

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Mirjana U. Grujić-Brojčin

**OPTIČKA SPEKTROSKOPIJA
OKSIDNIH NANOPRAHOVA**

Doktorska disertacija

Beograd 2008

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

Mirjana U. Grujić-Brojčin

OPTICAL SPECTROSCOPY OF OXIDE NANOPOWDERS

Doctoral dissertation

Belgrade 2008

Komisija

Prof. dr Zoran V. Popović
Naučni savetnik
Institut za fiziku Univerzitet u Beogradu

Dr Maja Šćepanović
Viši naučni saradnik
Institut za fiziku Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vitomir Milanović
Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jovan Radunović
Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu

Datum odbrane

16.10.2008

ZAHVALNOST

Ovaj rad je urađen pod rukovodstvom Prof. Dr Zorana V. Popovića u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, kao deo aktivnosti na projektu 141047 Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i OPSA-026283 FP6 projekta Evropske Unije.

Posebnu zahvalnost na velikoj pomoći tokom izrade ove teze dugujem kolegama i saradnicima:

Prof. Dr Zoranu V. Popoviću, na nizu korisnih sugestija, koje su doprinele kompletnosti ove teze.

Dr Maji Šćepanović, koja je rukovodila delom teze vezanim za karakterizaciju anatas TiO_2 nanoprahova.

Dr Zorani Dohčević-Mitrović, koja je rukovodila delom teze vezanim za karakterizaciju $\text{CeO}_{2-\delta}$ i $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova.

Dr Snežani Bošković (Institut za nuklearne nauke, Vinča) i Dr Fritzu Aldingeru (Max-Planck-Institut für Metalforschung, Stuttgart, Nemačka), za sintezu uzorka $\text{CeO}_{2-\square}$ i $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova.

Dr Branku Matoviću (Institut za nuklearne nauke, Vinča) za rezultate i analizu rendgenostrukturalnih merenja nanoprahova koji su proučavani u ovoj tezi.

Kolegama i prijateljima, posebno Dr Slobodanki Galović i Dr Daliboru Čevizoviću (Institut za nuklearne nauke, Vinča), Dr Jovanu Hadživukoviću (Infineon Technologies, Nemačka), Dr Slobodanu Novokmetu (Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu) i Mr Mariji Rašković (Old Dominion University, Norfolk, Virginia).

Staroj i novoj porodici, na svemu.

Optička spektroskopija oksidnih nanoprahova

Rezime

U ovom radu izloženi su rezultati istraživanja strukturnih i optičkih svojstava oksidnih nanoprahova primenom metoda ramanske, fotoluminescentne i infracrvene spektroskopije. Predloženi su fenomenološki modeli za analizu eksperimentalnih ramanskih i IC spektara, koji polaze od osnovnih svojstava odgovarajućih kristalnih materijala, a zatim uvode specifičnosti nanomaterijala, kako bi bliže odredili njihove karakteristike. U tom cilju razvijeni su numerički modeli i programi, koji su testirani u odnosu na eksperimentalne podatke o poznatim efektima u nanomaterijalima, a zatim su modelovani eksperimentalni spektri odabralih nanoprahova. Korišćeni su anatas TiO_2 nanoprahovi, sintetisani laserski indukovanim pirolizom, kao i čist $CeO_{2-\delta}$ i dopirani $Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-\delta}$ nanoprahovi, sintetisani samopropagirajućom sintezom na sobnoj temperatri. Takođe su izloženi su rezultati karakterizacije ispitivanih nanomaterijala metodama difrakcije X-zraka (XRD), merenja specifične površine (BET) i skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM), kao i osnovni literaturni podatci o strukturalnim, simetrijskim i vibracijskim karakteristikama odgovarajućih kristalnih struktura, neophodno za modelovanje eksperimentalnih spektara. Dat je pregled defekata, koji mogu da nastanu u ovim materijalima i imaju uticaj na njihova strukturalna i elektronska svojstva, sa posebnim osvrtom na defekte povezane sa promenom stehiometrije.

Razvijeni su, opisani i primjenjeni numerički model i originalni softver za primenu modela fononskog ograničenja (MFO) za analizu ramanskih spektara nanostrukturalnih materijala, koji se može koristiti za široku klasu nanostrukturalnih materijala (nanoprahovi, kvantne tačke, kvantne žice, tanki filmovi). MFO modeluje efekte fononskog ograničenja, fononske disperzije, distribucije dimenzija nanočestica, mikronaprezaanja, nestehiometrije, kao i anharmonijski efekat. Model je primjenjen na ramanske spekture anatas TiO_2 nanopahova, kao i čistih i dopiranih $CeO_{2-\delta}$ nanoprahova, a rezultati su upoređeni sa eksperimentalnim spektrima. Na osnovu analize ramanskog pomeraja i asimetričnog širenja kod najintenzivnijeg anatas E_g moda i F_{2g} moda u CeO_2 , izvedeni su zaključci o prisustvu, odnosno dominaciji pojedinih efekata u merenim uzorcima nanoprahova. Metoda ramanske spektroskopije posebno je primjenjena u analizi defekata, koji se javljaju u navedenim nanoprahovima, usled nestehiometrije i/ili dopiranja. Prikazana je detaljna analiza uticaja pojedinih parametara MFO na položaj, širinu i oblik modelovanog ramanskog spektra nanomaterijala. Razmatrani su uticaji jačine i dimenzije fononskog ograničenja, fononski disperzija, simetrije i anizotropije Brillouin-ove zone, distribucije dimenzija nanočestica, usrednjjenog i nehomogenog naprezanja, odstupanja od stehiometrije i anharmonijskog efekta. Posebno je analiziran uticaj oblika raspodele dimenzije nanočestice, kroz primenu simetrične i asimetrične Gauss-

ove raspodele, kao i efekte usrednjenoj, odnosno nehomogenoj naprezanja kristalne rešetke na pomeranje i asimetrično širenje modelovanog ramanskog moda. Analizirana je temperaturska zavisnost ramanskog spektra nanomaterijala. Potvrđena je sposobnost ramanske spektroskopije da uspešno identificuje i razlikuje lokalno okruženje defekata u kristalnoj strukturi.

Izloženi su i analizirani fotoluminescentni (FL) spektri anatas TiO_2 nanoprahova, koji imaju jaku emisiju u vidljivom delu spektra, sa ciljem da se odrede dominantni mehanizmi luminescencije. Predložen je model, koji omogućava razdvajanje učešća pojedinih FL mehanizama, povezanih sa radijativnom rekombinacijom posredstvom određenih lokalizovanih nivoa unutar zabranjene zone i daje mogućnost prepoznavanja dominantnih defekata u nanoprahovima na osnovu njihovih FL spektara. Fotolumescencija u vidljivom delu spektra, pripisana je mehanizmima radijativne rekombinacije posredstvom kiseoničnih vakancija, površinskih stanja i samozarobljenih ekscitona, koji dolaze do izražaja u zavisnosti od uslova pobude i karakteristika samog nanopraha. Ovi mehanizmi detaljno su analizirani i predložen je model, kojim se razdvajaju njihov uticaj u FL spektrima. Razmotren je uticaj energije i snage pobude, kao i nestehiometrije i temperature na položaj i intenzitet FL spektara anatas nanopraha sa različitim dimenzijama nanočestice i naprezanjem kristlane rešetke. Prikazana fotoluminescentna svojstva anatas TiO_2 nanoprahova pobuđenih vidljivom svetlošću upućuju na mogućnost njihove primene u fotokatalizi, optičkim prevlakama i fotoelektrohemijskoj konverziji pomoću vidljive svetlosti.

Razvijeni su numerički modeli za analizu eksperimentalnih IC spektara široke klase poroznih nanoprahova i nanokompozita, zasnovani na fenomenološkim aproksimacijama efektivne sredine, koja uključuje parametre za modeliranje zapreminskog učešća nanopraha, veličine i oblika nanočestica, odnosno pora u njemu, i originalni softver za modelovanje IC spektara poroznih nanoprahova. Posebno je modelovan uticaj plazmon-fonon interakcije u nanoprahovima sa značajnom koncentracijom slobodnih elektrona u nestehiometrijskom anatas nanoprahu.

IC spektar anatas nanopraha modelovan je primenom generalisane Bruggeman-ove fenomenološke teorije efektivne sredine, polazeći od spektra odgovarajućeg monokristalnog materijala, i uzimajući u obzir polikristalni karakter nanopraha i poroznost nanopraha kao parametar. Poređenjem modelovanih sa eksperimentalnim IC spektrima refleksije, dobijene su vrednosti učestanost i prigušenja TO i LO modova. Procenjeno je zapreminska učešća vazduha u nanoprahu, koje se može povezati sa poroznošću praha, a dobijene vrednosti su u skladu sa eksperimentalno određenom specifičnom površinom nanopraha dobijenom iz BET merenja. Primenom ovog modela takođe je procenjen oblik pora. Zapaženo je da smanjenje veličine kristalita, praćeno povećanjem poroznosti TiO_2 nanopraha, dovodi do smanjenja intenziteta refleksivnosti u eksperimentalnim IC spektrima. U spektrima nestehiometrijskog anatas nanopraha registrovana je pojava jakog plazmonskeg moda, koji ukazuje na prisustvo velikog broja slobodnih elektrona, usled povećane koncentracije nestehiometrijskih defekata (titanjumskih intersticija i kiseoničnih vakancija), koji igraju ulogu donora. Ovi spektri analizirani su primenom

generalisovanog Bruggeman-ovog modela mofifikovanog Drudeovim članom, kojim se modeluje doprinos plazmonskog moda.

U ovom radu su posebno analizirani uticaji uslova merenja na oksidne nanoprahove. Iako su spektroskopske metode u osnovi nedestruktivne, kod oksidnih nanoprahova često dolazi do pojave gubitka kiseonika usled izlaganja vakuumu i pojačanim lokalnim zagrevanjem usled laserskog ozračivanja, što posebno dolazi do izražaja u nanomaterijalima.

Originalni rezultati numeričkih modela i eksperimentalnih metoda, prikazani u ovom radu, kao i njihova velika međusobna saglasnost, predstavljaju značajan korak u proučavanju optičkih svojstava oksidnih nanoprahova primenom spektroskopskih metoda. Prikazani eksperimentalni spektri, kao i njihova sistematska interpretacija, pokazali su da ramanska, FL i IC spektroskopija predstavljaju moćne metode za karakterizaciju oksidnih nanoprahova. Dobijene informacije o strukturalnim i elektronskim svojstvima konkretnih oksidnih nanoprahova daju značajan doprinos razumevanju uticaja uslova sinteze na njihove željene karakteristike i potencijalnu primenu. Primena optičke spektroskopije, sistematizacija i teorijska analiza dobijenih rezultata doprinose formiranju kompletnije slike, kako o oksidnim nanoprahovima, tako i nanostrukturnim materijalima uopšte.

Ključne reči: oksidni nanoprahovi, titanijum dioksid, cerijum dioksid, ramanska spektroskopija, model fononskog ograničenja, infracrvena spektroskopija, teorija efektivne sredine, fotoluminescentna spektroskopija

Naučna oblast: Elektrotehnika

Uža naučna oblast: Fizička elektronika

UDK broj: 621.3

Optical spectroscopy of oxide nanopowders

Abstract

In this work the research of structural and optical properties of oxide nanopowders by Raman, photoluminescence and infrared spectroscopy have been presented. The phenomenological models for analyzing experimental Raman and infrared spectra have been proposed, based on properties of corresponding bulk materials, and specific properties of nanomaterials have been introduced into models, in order to determine the properties of these particular nanopowders. Numerical models and corresponding software have been developed and tested regarding the experimental data of already known effects in nanomaterials, and than the experimental spectra of chosen nanopowders have been modeled. The TiO_2 nanopowders in anatase phase, synthesized by laser induced pyrolysis, have been used, as well as the pure $\text{CeO}_{2-\delta}$ and doped $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanopowders, synthesized by the method of self propagated room temperature. Investigated nanomaterials have also been characterised by the methods of X-ray diffraction (XRD), specific surface measurements (BET), and scanning tunneling microscopy (SEM), and basic literature data on structural, symmetry and vibrational characteristics of corresponding bulk crystal structures, important in the process of modeling the experimental spectra, have been presented. The review of defects, which can appear and influence the structural and electronic properties if these materials has also been given, with special attention to defects related to the changes in stoichiometry.

Numerical model and original software for application of the phonon confinement model (PCM) to the Raman spectra of nanostructural materials have been developed, described and applied. This model may be applied to the wide class of nanostructural materials, such as nanopowders, quantum dots, nanowires, thin films. The PCM has been used to explore the effects of phonon confinement, phonon dispersions, particle size distribution, microstrain, nonstoichiometry, as well as the anharmonic effects. The model has been applied to calculate Raman spectra of anatase nanopowders and pure and doped $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopowders, and compare the results with experimental spectra, in order to describe the effects present in particular oxide nanopowders, by analyzing the Raman shift and asymmetrical broadening of the most intensive E_g mode in anatase and F_{2g} mode in the spectra of $\text{CeO}_{2-\delta}$ samples. The Raman spectroscopy has also been applied to analyze the defects, which have appeared in those nanopowders, due to nonstoichiometry and/or doping. The influence of PCM parameters on the shift, linewidth and shape of Raman mode has been analyzed in details, with particular attention to the confinement strength, phonon dispersions, symmetry and anisotropy of Brillouin zone, particle size distribution, average and inhomogeneous strain, nonstoichiometry and anharmonic effects. The influence of the shape of particle size distribution (symmetrical and asymmetrical

Gauss distribution) on Raman shift and asymmetrical broadening has been discussed. The temperature dependence of Raman spectra has been successfully distinguished from phonon confinement effects. Also, the ability of Raman spectroscopy to successfully detect and distinguish local surrounding of defects in crystal structure has been confirmed.

The photoluminescence (PL) spectra of anatas nanopowders have been presented and analyzed, in order to determine dominant mechanisms of luminescence. Proposed model allows several PL mechanisms to be distinguished from PL spectrum. That way there is possibility for dominant defects in nanopowders to be recognized from PL spectra. Photoluminescence in visible part of spectrum is ascribed to the mechanisms of radiative recombinations through some localized levels in forbidden zone: oxygen vacancies, surface states and self-trapped excitons, which appear as a consequence of both excitation conditions and the properties of nanopowders. These mechanisms are thoroughly discussed and the model, which deviates their influence on PL spectra is proposed. The influence of energy and excitation power, as well as the nonstoichiometry and temperature, on the position and intensity of FL bands in anatase nanopowder samples with different particle size and strain of crystall lattice, have been also analyzed. The PL properties of anatas nanopowders excited by visible light point to their application in photocatalysis, optical coatings and photoelectrochemical conversion.

Razvijeni su numerički modeli za analizu eksperimentalnih IC spektara široke klase poroznih nanoprahova i nanokompozita, zasnovani na fenomenološkim aproksimacijama efektivne sredine, koja uključuje parametre za modeliranje zapreminskog učešća nanopraha, veličine i oblika nanočestica, odnosno pora u njemu, i originalni softver za modelovanje IC spektara poroznih nanoprahova. Posebno je modelovan uticaj plazmon-fonon interakcije u nanoprahovima sa značajnom koncentracijom slobodnih elektrona u nestehiometrijskom anatas nanoprahu.

Infrared (IR) spectra of anatas nanopowders have been modeled by generalized Bruggeman effective medium approximation (EMA), based on the spectrum of corresponding bulk material, polycrystal character of the nanopowders and the porosity of nanopowder as a parameter. Calculated IR spectra are compared to the experimental, and the frequencies and damping parameters of TO and LO modes are obtained. The volume fraction of air in porous nanopowder has been estimated and correlated to specific surface area of powders, obtained experimentally from BET measurements. The shape of the pores in nanopowders has also determined by this model. It has been noticed that smaller crystallite size, followed by higher porosity, caused less intensive reflectivity spectra in experimental IR results. In the spectra of nonstoichiometric anatase nanopowder strong plasmon mode has been detected, due to increased concentration of nonstoichiometric defects, pointing to the presence of high concentration of free electrons (titanium interstitials and oxygen vacancies), taking the donor role. These spectra are analyzed by Bruggeman EMA with Drude term included to calculate plasmon contribution to IR spectra.

In this work the influences of experimental conditions on oxide nanopowders have been particularly addressed. Although spectroscopic experimental methods are

basically nondestructive, the loss of oxygen due to exposure to vacuum and increased local heating due to laser irradiation, is common feature in oxide nanopowders.

Original results of numerical models and experimental methods, shown in this work, represent significant step in studying optical properties of oxide nanopowders by spectroscopic methods. The experimental spectra, as well as their systematic interpretation, have confirmed the power of Raman, photoluminescence and infrared spectroscopy in characterization of oxide nanopowders. The information obtained on structural, optical and electronic properties of particular oxide nanopowders are important for better understanding of the influence of synthesis conditions on desired characteristics and corresponding application. Optical spectroscopy, systematization, and theoretical analysis of results make the picture, not only of nanopowders, but also nanostructural materials, more complete.

Ključne reči: oxide nanopowders, titanium dioxide, cerium dioxide, Raman spectroscopy, phonon confinement model, infrared spectroscopy, effective medium approximation, photoluminescence spectroscopy

Scientific field: Electrical engineering

Research area: Physical electronic

UDC number: 621.3

Rezultati disertacije objavljeni u međunarodnim časopisima

1. M. Šćepanović, Z. D. Dohčević-Mitrović, I. Hinić, M. Grujić-Brojčin, G. Stanišić, and Z. V. Popović (2005): Photoluminescence of Laser-Synthesized Anatase Titanium Dioxide Nanopowders, Materials Science Forum 494, 265-270.
2. M. Grujić-Brojčin, M. J. Šćepanović, Z. D. Dohčević-Mitrović, I. Hinić, B. Matović, G. Stanišić and Z. V. Popović (2005): Infrared study of laser synthesized anatase TiO₂ nanopowders, J. Phys. D: Appl. Phys. 38, 1415–1420.
3. M. J. Šćepanović, M. U. Grujić-Brojčin, Z. D. Dohčević-Mitrović, and Z.V. Popović (2006): Effects of Confinement, Strain and Nonstoichiometry on Raman Spectra of Anatase TiO₂ Nanopowders, Materials Science Forum 518, 101-106.
4. Z.V. Popović, Z. Dohčević-Mitrović, M. Šćepanović, and M. Grujić-Brojčin (2006): Nanopowders Characterization using the Optical Spectroscopy Methods, Advances in Science and Technology 45, 327-336.
5. M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. Dohčević-Mitrović, and Z. V. Popović (2006): Infrared Study of Nonstoichiometric Anatase TiO₂ Nanopowders, Science of Sintering, 38, 183-189.
6. Z. D. Dohčević-Mitrović, M. J. Šćepanović, M. U. Grujić-Brojčin, Z.V. Popović, S. B. Bošković, B. M. Matović, M. V. Zinkevich, and F. Aldinger (2006): The size and strain effects on the Raman spectra of Ce_{1-x}Nd_xO_{2-δ} (0.10<x<0.25) nanopowders, Solid State Communications 137, 387–390.
7. Z. D. Dohčević-Mitrović, M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. V. Popović, S. Bošković, B. Matović, M. Zinkevich and F. Aldinger (2006): Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ} nanopowders: potential materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells, J. Phys.: Condens. Matter 18, S2061–S2068.
8. M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, I. Bineva, D. Nesheva, Z. Aneva, Z. Levi, Z. V. Popović (2007): Raman study of ZnSe/SiO_x multilayers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9(1), 178 - 181.
9. M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, Z. V. Popović (2007): Vibrational spectroscopy methods in the characterization of nanostructured materials, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9(1), 30 - 36.
10. M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, Z. V. Popović (2007): Temperature dependence of the lowest frequency E_g Raman mode in laser-synthesized anatase TiO₂ nanopowder, Appl. Phys. A 86, 365–371.
11. M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, K. Vojisljević, T. Srećković and Z.V. Popović (2007): The Effects of Nonstoichiometry on Optical Properties of Oxide Nanopowders, Acta Physica Polonica A 112(5), 1019-1024.
12. M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. D. Dohčević-Mitrović, and Z. V. Popović (2007): Characterization of anatase TiO₂ nanopowder by variable-temperature Raman spectroscopy, Science of Sintering (u štampi).

Sadržaj

UVOD	1
1. OKSIDNI NANOPRAHOVI	5
1.1. Titanijum dioksid (TiO_2)	6
1.1.1. Struktura i svojstva TiO_2	6
1.1.2. Nestehiometrija i defekti kod anatas TiO_2	13
1.1.3. Anatas TiO_2 nanoprahovi	15
1.1.3.1. Sinteza anatas nanoprahova	15
1.1.3.2. Karakterizacija anatas nanoprahova	16
1.2. Cerijum dioksid (CeO_2)	20
1.2.1. Struktura i svojstva CeO_2	20
1.2.2. Nestehiometrija i defekti kod CeO_2	24
1.2.3. CeO_2 nanoprahovi	26
1.2.3.1. Sinteza CeO_2 nanoprahova	26
1.2.3.2. Karakterizacija CeO_2 nanoprahova	27
2. RAMANSKA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA	30
2.1. Teorijske osnove ramanske spektroskopije	31
2.1.1. Klasična teorija ramanskog rasejanja	31
2.1.2. Kvantna teorija ramanskog rasejanja	34
2.1.3. Temperaturska zavisnost ramanskog spektra	37
2.2. Uredaj za ramansku spektroskopiju	38
2.3. Modelovanje ramanskih spektara nanomaterijala	41
2.3.1. Model fononskog ograničenja (MFO)	43
2.3.1.1. Jačina i dimenzija fononskog ograničenja u MFO	45
2.3.1.2. Uloga fononske disperzije u MFO	48
2.3.1.3. Modelovanje raspodele dimenzija nanočestica u MFO	53
2.3.1.4. Modelovanje nehomogenog naprezanja u MFO	58
2.3.1.5. Modelovanje anharmonijskog efekta	64
2.4. Ramanski spektri anatas TiO_2 nanoprahova	68
2.4.1. Primena MFO na ramanski spektar anatas TiO_2 nanopraha	70
2.4.1.1. Uticaj fononskih disperzionih funkcija na modelovanje ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha	72
2.4.1.2. Uticaj dimenzije nanočestice na ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha	73
2.4.1.3. Uticaj naprezanja na ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha	74
2.4.1.4. Uticaj nestehiometrije na ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha	77
2.4.1.5. Anharmonijski efekat u anatas TiO_2 nanoprahu	78

2.5. Ramanski spektri CeO_2 i $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\square}$ nanoprahova	87
2.5.1. Primena MFO na ramanski spektar CeO_2 nanopraha	88
2.5.2. Primena MFO na ramanski spektar $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\square}$ nanoprahova	91
3. FOTOLUMINESCENTNA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA	95
3.1. Teorijske osnove fotoluminescentne spektroskopije	95
3.1.1. Fotouminescencija u niskodimenzionim sistemima	98
3.2. Fotoluminescentni spektri anatas TiO_2	99
3.2.1. Eksperimentalni FL spektri anatas TiO_2 nanoprahova	105
3.2.1.1. Uticaj pobudne energije lasera na FL spektre anatas TiO_2 nanoprahova	107
3.2.1.2. Uticaj pobudne snage lasera na FL spektre anatas TiO_2 nanoprahova	110
3.2.1.3. Uticaj nestehiometrije na FL spektre anatas TiO_2 nanoprahova	112
3.2.1.4. Uticaj temperature na FL spektre anatas TiO_2 nanoprahova	114
4. INFRACRVENA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA	118
4.1. Teorijske osnove infracrvene spektroskopije	119
4.2. Opis uređaja za infracrvenu spektroskopiju	120
4.3. Numeričke metode analize IC spektara refleksije	124
4.3.1. Četvoroparametarski model	124
4.3.2. Četvoroparametarski model sa plazmon-fonon interakcijom	125
4.3.3. Fenomenološka teorija efektivne sredine	126
4.3.3.1. Bruggeman-ov model	127
4.3.3.2. Generalisani Bruggeman-ov model	127
4.4. Modelovanje IC spektara nanoprahova	128
4.4.1. IC spektar anatas TiO_2 monokristala	128
4.4.2. Modelovanje polikristalne prirode nanopraha	129
4.4.3. Modelovanje IC spektara poroznog anatas TiO_2 nanopraha	131
4.5. Poređenje eksperimentalnih i modelovanih IC spektara anatas TiO_2 nanoprahova	135
4.5.1. Analiza IC spektara stehiometrijskih anatas TiO_2 nanoprahova	135
4.5.2. Analiza IC spektra nestehiometrijskog anatas TiO_2 nanopraha	140
ZAKLJUČAK	144
LITERATURA	151

UVOD

Oksidni nanoprahovi predstavljaju posebnu klasu nanomaterijala¹, sa česticama prečnika manjeg od 100 nm. Smanjenje dimenzija čvrstih oksidnih materijala za posledicu ima mogućnost promene njihovih svojstava i otvara perspektive za njihovu raznovrsnu primenu. Tako su do sada ovi materijali našli svoje mesto u proizvodnji mikroelektronskih kola, senzora, piezoelektričnih naprava, gorivnih čelija, antikorozivnih i optičkih prevlaka, katalizatora itd.

Značajno povećanje odnosa površine i zapremine i pojava kvantnih efekata dva su osnovna faktora, koji čine da se svojstva nanomaterijala veoma razlikuju od svojstava odgovarajućih makroskopskih materijala. Naime, sa smanjenjem dimenzije nanočestica dolazi do povećanja broja atoma koji se nalaze na površini materijala u odnosu na broj atoma u njegovoj unutrašnjosti i pojave većeg broja nezasićenih veza.

Oksidni nanoprahovi sintetišu se pomoću niza različitih fizičkih i hemijskih postupaka, u kojima je u novije vreme ostvaren značajan napredak u pogledu homogenosti strukturnih i elektronskih svojstava i uniformnosti distribucije veličina nanočestica. Međutim, potpuna kontrola uticaja parametara sinteze na karakteristike oksidnih nanomaterijala još uvek nije postignuta. Istraživanje problema vezanih za stehiometriju oksida, odnosno prisustvo nečistoća i amorfnih faza koje koegzistiraju sa kristalnom, upućuju na to da strukturalna i elektronska svojstva, kao i distribucija dimenzija nanočestica, veoma zavise od metoda sinteze. Zbog toga detaljna i potpuna karakterizacija pojedinih nanomaterijala, dobijenih specifičnim metodama sinteze, predstavlja jedan od osnovnih ciljeva u nanotehnologiji. Da bi se to postiglo, neophodno

¹ Pod nanomaterijalima predstavljaju materijale čije strukturne komponente imaju bar jednu prostornu dimenziju manju od 100 nm.

je dalje usavršavati eksperimentalne tehnike koje se primenjuju u ovoj oblasti (rentgenostrukturne tehnike, mikroskopske metode, vibracijske i elektronske spektroskopije itd.), kao i odgovarajuće metode teorijske analize. Pri tome se prednost mora dati tehnikama za strukturnu i elektronsku karakterizaciju, koje daju i mogućnost praćenja ponašanja oksidnih nanostruktura kada se njihovo okruženje menja. Pravilna interpretacija eksperimentalnih rezultata dobijenih ovim tehnikama karakterizacije, svakako je jedan od najvažnijih zadataka, pa bi primena optičke spektroskopije, sistematizacija i teorijska analiza dobijenih rezultata, u tom smislu trebalo da doprinesu konačnom razumevanju uticaja uslova sinteze na željene karakteristike i potencijalnu primenu, kako oksidnih nanoprahova, tako i drugih nanomaterijala.

Cilj ovog rada je eksperimentalno i teorijsko proučavanje optičkih svojstava oksidnih nanoprahova primenom spektroskopskih metoda. Da bi se korektno interpretirali dobijeni eksperimentalni rezultati, u okviru ovog rada razvijeni su i opisani odgovarajući modeli za analizu ramanskih, fotoluminescentnih i infracrvenih spektara, koji omogućavaju sistematsko proučavanje strukturnih i elektronskih svojstava, kako oksidnih, tako i velikog broja drugih nanomaterijala. Razvijeni modeli primjenjeni su na infracrvene, ramanske i fotoluminescentne spekture anatas TiO_2 nanoprahova sintetisanih laserski indukovanim pirolizom, kao i spekture čistih $CeO_{2-\delta}$ i dopiranih $Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-\delta}$ nanoprahova, sintetisanih samopropagirajućom sintezom na sobnoj temperaturi (SPRT). Zbog svojih specifičnih svojstava, ovi nanoprahovi poslednjih godina privlače veliku pažnju, pre svega u oblasti savremenih energijskih tehnologija (solarne i gorivne ćelije). Osim toga, TiO_2 nanokristali imaju široku primenu kao fotokatalizatori, optičke prevlake i fotoelektrohemijske solarne ćelije, dok je $CeO_{2-\delta}$ perspektivan materijal za katalizatore, senzore i elektrolite u čvrstim gorivnim ćelijama.

U skladu sa navedenim ciljevima, u **Glavi 1** ovog rada izloženi su rezultati karakterizacije ispitivanih nanomaterijala (anatas TiO_2 , čistog i dopiranog $CeO_{2-\delta}$) metodama difrakcije X-zraka (XRD), merenja specifične površine (BET) i skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM). Osim toga, ova glava sadrži i raspoložive literaturne podatke o osnovnim strukturnim, simetrijskim i vibracijskim karakteristikama ovih materijala, čije poznavanje omogućava modelovanje njihovih ramanskih, fotoluminescentnih i infracrvenih spektara. Takođe je dat je pregled defekata, koji

nastaju u ovim materijalima, a koji mogu da imaju uticaj na njihova struktura i elektronska svojstva, sa posebnim osvrtom na defekte povezane sa promenom stehiometrije.

U **Glavi 2** su analizirani rezultati dobijeni primenom **ramanske spektroskopije** na anatas TiO_2 nanoprahove i $\text{CeO}_{2-\delta}$ čiste i dopirane nanoprahove. U tom cilju, razvijen je i opisan numerički model i originalni softver za analizu ramanskih spektara nanostrukturalnih materijala. Model je primenljiv na široku klasu nanostrukturalnih materijala, koja pored nanoprahova, uključuje i kvantne tačke, kvantne žice, tanke filmove itd. Ovaj model obuhvata sledeće efekte: fononsko ograničenje², fononske disperzije, distribuciju dimenzija nanočestica, mikronaprezanje, nestehiometriju i anharmonijski efekat. Model je primenjen na ramanske spekture anatas TiO_2 nanoprahova, kao i čistih i dopiranih $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanoprahova. Dobijeni rezultati su upoređeni sa eksperimentalnim spektrima i na osnovu toga izvedeni su zaključci o prisustvu, odnosno dominaciji pojedinih efekata u merenim uzorcima nanoprahova. Metoda ramanske spektroskopije posebno je primenjena u analizi defekata, koji se javljaju u navedenim nanoprahovima, usled nestehiometrije i/ili dopiranja.

U **Glavi 3** su izloženi i analizirani **fotoluminescentni (FL) spektri** anatas TiO_2 nanoprahova, koji imaju jaku FL emisiju u vidljivom delu spektra, sa ciljem da se odrede dominantni mehanizmi luminescencije. Predložen je model, koji omogućava razdvajanje učešća pojedinih FL mehanizama, povezanih sa radijativnom rekombinacijom posredstvom određenih lokalizovanih nivoa unutar zabranjene zone. Ovaj model daje mogućnost prepoznavanja dominantnih defekata (kiseonične vakancije, površinska stanja, samozarobljeni ekscitonii) kod anatas TiO_2 nanoprahova na osnovu njihovih FL spektara, što ima veoma važnu ulogu u njihovoј primeni u fotokatalizatorima, optičkim prevlakama i fotoelektrohemijskoj konverziji pomoću vidljive svetlosti.

Glava 4 sadrži analizu eksperimentalnih IC spektara anatas TiO_2 nanoprahova. Razvijeni su numerički model, zasnovan na fenomenološkim aproksimacijama efektivne sredine, koji uključuje parametre za modeliranje zapreminskega učešća nanopraha, veličine i oblika nanočestica, odnosno pora u njemu, i originalni softver za modelovanje IC spektara poroznih nanoprahova. Posebno je modelovan uticaj plazmon-

² Phonon confinement.

fonon interakcije u nanoprahovima sa značajnom koncentracijom slobodnih elektrona u nestehiometrijskom anatas nanoprahu. Ovaj model je primenljiv na široku klasu poroznih nanoprahova i nanokompozita.

Na kraju su dati Zaključak i Literatura. Slike preuzete iz literature su sa naznačenim izvorom, a sve ostale predstavljaju originalan rezultat ovog istraživanja.

Odeljci su numerisani za svaku glavu ponaosob, dok se u numeraciji jednačina i slika prvi broj odnosi na broj glave.

Sva spektroskopska merenja, čiji rezultati su prikazani u ovom radu, izvršena su Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku u Beogradu. Sinteza anatas TiO_2 nanoprahova obavljena je u Laboratoriji za fotohemiju Instituta CISE u Milanu (Italija), a $CeO_{2-\delta}$ i $Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-\delta}$ nanoprahova u Max Planck institutu za istraživanje metala (Laboratorijs za metalurgiju prahova) u Štutgartu (Nemačka).

1. OKSIDNI NANOPRAHOVI

Metalni oksidi igraju veoma značajnu ulogu u mnogim područjima fizike, hemije i nauke o materijalima. Metali mogu da formiraju veliki broj raznovrsnih oksidnih jedinjenja, koja zavisno od strukture i elektronskih svojstava ispoljavaju metalne, poluprovodne ili izolatorske karakteristike. U tehnološkim primenama oksidi se koriste u proizvodnji mikroelektronskih naprava, senzora, piezoelektričnih naprava, gorivnih čelija, prevlaka, katalizatora itd.

Usled ograničenih dimenzija i velike gustine površinskih stanja, oksidni nanomaterijali ispoljavaju jedinstvena strukturalna i elektronska svojstva. Promena strukture kod nanomaterijala uključuje promenu simetrije i parametara kristalne rešetke. Za razliku od zapreminskih oksida, koji su, po pravilu, sistemi sa dobro definisanom kristalografskom strukturom, kod oksidnih nanomaterijala povećanje broja površinskih i graničnih atoma sa smanjenjem dimenzija čestice dovodi do naprezanja u materijalu i pratećih modifikacija parametara kristalne rešetke i/ili strukturnih transformacija. Prisustvo diskretnih elektronskih nivoa, sličnih atomskim, u nanostrukturama dovodi i do pojave efekta tzv. elektronskog ograničenja³, što prouzrokuje promenu energijskog procepa [1].

Površinska svojstva nanostrukturnih oksida takođe su jako modifikovana u odnosu na odgovarajuća svojstva u zapreminskim oksidima. Promena stehiometrije, vezana za prisustvo velikog broja slobodnih i nezasićenih veza i defekata (kao što su kiseonične vakancije) ili prisustvo nečistoća u površinskim slojevima, koji su veoma izraženi kod oksidnih nanomaterijala, predmet su posebne pažnje u istraživanjima.

³ *Electron confinement.*

Na osnovu uticaja nanometarskih dimenzija oksida na njihova strukturna i elektronska svojstva, oksidi se mogu podeliti u dve grupe. Prva obuhvata materijale kod kojih se nanostrukturnom obliku stabilizuju specifične modifikacije, koje nisu stabilne kod zapreminskih kristala, dok druga grupa obuhvata one okside kod kojih i nanostrukturni i kristalni uzorci postoje u istoj modifikaciji [1]. Prva grupa je tipična za oksidne sisteme u kojima stabilna kristalna modifikacija sadrži gusto pakovane kiseonične strukture, kao što je slučaj sa titanijim dioksidom (TiO_2). S druge strane, cerijum dioksid ($CeO_{2-\delta}$) se zbog česte industrijske primene pojavljuje kao glavni predstavnik druge grupe oksidnih materijala. Po svojoj elektronskoj strukturi TiO_2 i $CeO_{2-\delta}$ pripadaju grupi širokozonskih poluprovodnika. U ovom radu će biti prikazana karakterizacija anatas TiO_2 i čistog i dopiranih $CeO_{2-\delta}$ nanoprahova, pri čemu će težište istraživanja biti u primeni metoda optičke spektroskopije, kao i analizi i sistematizaciji dobijenih rezultata.

1.1. Titanijum dioksid (TiO_2)

1.1.1. Struktura i svojstva TiO_2

Titanijum dioksid spada u grupu širokozonskih poluprovodnika, transparentnih u vidljivom delu spektra elektromagnetskog zračenja, sa visokim indeksom prelamanja [2, 3]. Javlja se u tri strukturne modifikacije: rutil (tetragonalna, $P4_2/mnm$, D_{4h}^{14}), anatas (tetragonalna, $I4_1/amd$, D_{4h}^{19}) i brukit (ortorombična, $Pbca$, D_{2h}^{15}).

Rutil je najzastupljenija modifikacija TiO_2 u prirodi [4] i do sada je teorijski i experimentalno najviše istraživan, kao najstabilnija i najkompaktnija faza TiO_2 i jedina koja opstaje na visokim temperaturama ($>800\text{ }^{\circ}\text{C}$) [5-7]. Anatas i brukit retko su izučavani u poređenju sa rutilom, pre svega zbog teškoća pri njihovoј sintezi u obliku makroskopskog kristala [6]. Na višim temperaturama anatas i brukit faza TiO_2 ireverzibilnim procesom prelaze u rutilnu fazu, u temperaturskom opsegu izmedju 500 i $900\text{ }^{\circ}\text{C}$, u zavisnosti od uslova sinteze [3, 8].

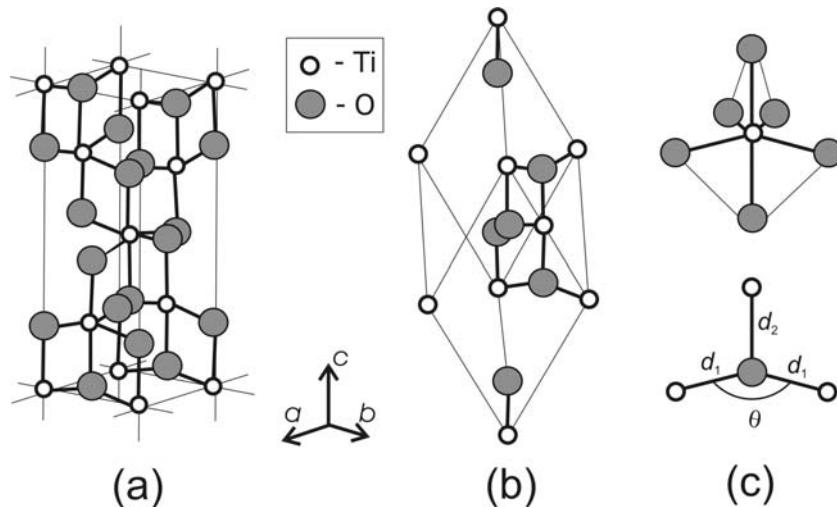
Anatas TiO_2 kristal je nestabilniji od rutila, zahvaljujući većoj oktaedarskoj distorziji, kao i većoj zapremini kristalne rešetke, odnosno manjoj gustini u odnosu na

rutil [9]. Osim toga, nanostruktura anatas faza ima drugačija svojstva u poređenju sa odgovarajućim kristalnim materijalom [10]. U poslednje vreme, eksperimenti koji ispituju uticaj dimenzije nanočestice na svojstva materijala, pokazuju da je u TiO₂ kristalima sa česticama prečnika ispod nekoliko desetina nanometara anatas faza stabilnija od rutilne, što se pripisuje uticaju površinskih efekata [11]. Istraživanja se u poslednje vreme više fokusiraju na anatas fazu, pre svega zbog veće efikasnosti u fotohemijskim i fotoelektrohemijskim primenama (elektrohemijske solarne ćelije, fotokatalizatori, optičke prevlake, pigmenti itd.) [1, 12-14]. Mnoge od ovih primena oslanjaju se na dobre karakteristike materijala na različitim temperaturama i pritiscima, pri izlaganju elektromagnetskom zračenju, površinskom reaktivnošću u kontaktu sa raznim hemijskim agensima. Mada je u poređenju sa rutilom anatas do nedavno privlačio mnogo manje pažnje, pre svega zbog uobičajenih prepostavki o sličnosti elektronske strukture, novi eksperimentalni i teorijski rezultati podstiču dalja istraživanja strukturalnih, elastičnih, elektronskih i optičkih svojstava anatas TiO₂ [15].

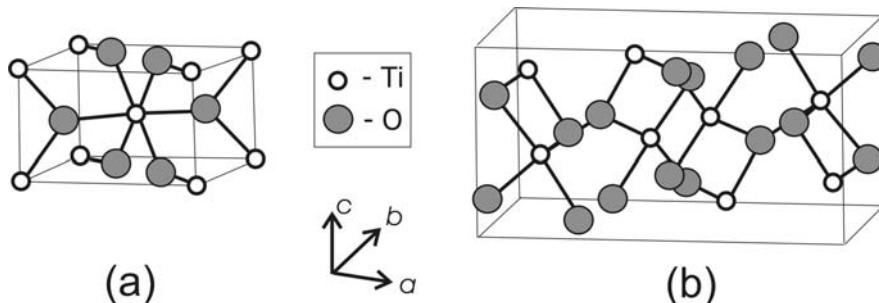
Sa druge strane, elektronska struktura anatas TiO₂ i dalje ostaje donekle nerazrešena [15]. Naime, ono u čemu se autori slažu, jeste da je anatas TiO₂ širokozonski poluprovodnik sa interesantnim optičkim i elektronskim svojstvima, sa visokim indeksom prelamanja, koji iznosi 2.54 na oko 550 nm (u poređenju sa rutilom, $n \sim 2.75$) i niskom apsorpcijom, što ga i čini veoma pogodnim materijalom za optičke prevlake, kao i visokom dielektričnom konstantom ($\epsilon > 100$), što daje mogućnosti za primenu u integriranim napravama [15, 16]. Pri tome, postoje neslaganja među najčešće korišćenim tehnikama za određivanje zonske strukture, čak do te mere, da neke od njih predviđaju direktni (Mikami et al. [5]), a neke od njih indirektni energijski procep (Asahi et al. [15], Mo and Ching [17])⁴. Mada oba materijala, i anatas i rutil TiO₂ nalaze svoju primenu u fotokatalitičkim i fotoelektrohemijskim aplikacijama, pokazalo se da anatas ima značajno drugačija elektronska i optička svojstva, gde je najznačajnija razlika veći energijski procep kod optičke apsorpcije i manja efektivna masa elektrona, što rezultuje većom pokretljivošću nosilaca nanelektrisanja [17].

⁴ Treba imati u vidu i da svi ovi proračuni predviđaju i dalje znatno manji energijski procep (1.4 eV), u odnosu na eksperimentalno određenu vrednost 3.2 eV [17, 18].

Parametri kristalne rešetke za sve 3 modifikacije prikazani su u Tabeli 1.1. U ovim strukturama svaki Ti atom okružen je sa 6 O atoma, a svaki O atom je povezan sa 3 susedna Ti atoma.



Slika 1.1. Ilustracija strukture anatas TiO_2 : konvencionalna jedinična (a), primitivna celija (b) i lokalno okruženje Ti i O atoma (c) u kristalnoj rešetki [5, 18].



Slika 1.2. Ilustracija ostalih strukturinih modifikacija TiO_2 : rutil (a) i brukit (b) [17].

Na Slici 1.1. prikazane su konvencionalna jedinična celija anatas TiO_2 kristala, tj. zapremski centrirana tetagonalna Bravova rešetka (a) i odgovarajuća primitivna celija (b), a ilustrovano je i lokalno okruženje Ti i O atoma u kristalnoj rešetki (c) [17]. U anatas fazi fragment OTi_3 ima približan "T" oblik, gde ugao θ (Ti-O-Ti) iznosi oko 156° [5]. Konvencionalna jedinična celija anatas TiO_2 sadrži 4 TiO_2 jedinice (12 atoma), definisane sa 3 kristalografska parametra: dva parametra rešetke (a i c) i sa jednim unutrašnjim parametrom koji se odnosi na položaj atoma kiseonika, $u=d_2/c$, gde je d_2

dužina "vertikalne" Ti-O veze. Titanijumovi atomi u (0,0,0) zauzimaju Wyckoff-ovu poziciju 4a, svi kiseonikovi atomi su ekvivalentni među sobom i nalaze se u poziciji 8e (0,0,u). Lokalne simetrije atoma Ti i O su D_{2d} i C_{2v} , redom [15, 18]. Na Slici 1.2. prikazane su, ilustracije radi, kristalne rešetke druge dve faze kristalnog TiO_2 , rutila i brukita.

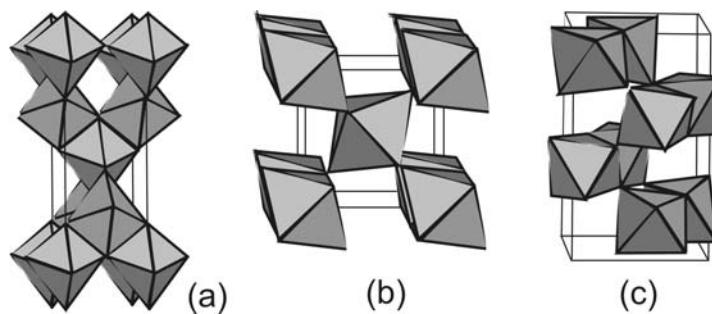
Tabela 1.1. Kristalne strukturne modifikacije TiO_2 [17].

	<i>Rutil</i> [19]	<i>Anatas</i> [19]	<i>Brukit</i> [20]
<i>Kristalna struktura</i>	<i>Tetragonalna</i>	<i>Tetragonalna</i>	<i>Ortorombična</i>
<i>a</i>	4.5936	3.784	9.184
<i>Konstanta rešetke</i> [\AA]	<i>b</i>		5.447
	<i>c</i>	2.9587	5.145
<i>Prostorna grupa</i>		$P4_2/mnm$	$I4_1/amd$
<i>Broj molekula po jed. čeliji</i>	2	4	8
<i>Zapremina po molekulu</i> [\AA^3]	31.2160	34.061	32.172
<i>Gustina</i> [g/cm^3]	4.13	3.79	3.99
<i>Dužina Ti-O veze</i> [\AA]	1.949(4) 1.980(2)	1.937(4) 1.965(2)	1.87-2.04
<i>O-Ti-O ugao između veza</i>	81.2 90.0	77.7 92.6	77.0-105.0

Uobičajeno je da se struktura materijala iz široke klase titanata (TiO_2 , BaTiO_3 , SrTiO_3 itd.) opisuju istom strukturnom jedinicom, deformisanim TiO_6 oktaedarima, tj. njihovim lancima, gde je titanijumov atom (katjon) u centru okružen sa 6 kiseonikovih atoma (O^{2-} anjona) smeštenih u vrhove oktaedara. Na Slici 1.3. ilustrovana je oktaedarska struktura anatas, rutil i brukit faze TiO_2 , sa različitim načinom lokalnog uređenja i povezivanja [3]. Oktaedri su povezani rogljevima (*vertex*) i dele naizmenične ivice. Svaku od ovih struktura karakteriše specifična distorzija oktaedra, koja se zasniva na tome da su 2 kiseonična atoma malo više udaljena od centralnog Ti atoma nego preostala 4 kiseonična atoma [21]. Oktaedar je blago deformisan tako da neki od O-Ti-O uglova odstupaju od 90° , a ova deformacija je jače izražena kod anatas modifikacije nego kod rutila i dovodi do povećanja zapremine jedinične čelije kod anatas faze (anatas ima gotovo 10% manju gustinu od rutila [21]), a samim tim i njene manje stabilnosti

[18]. Stepen distorzije, odnosno sabijanja⁵ tetraedra meri se ranije pomenutim unutrašnjim parametrom u , čija krajnja vrednost odgovara potpuno planarnoj konfiguraciji i iznosi $u=1/4$ [18]. Kristalna struktura ovih modifikacija TiO₂ se često u literaturi opisuje lancima TiO₆ oktaedara koji dele naizmenične ivice [17]. Osnovna razlika između anatas i rutil strukture TiO₂ nastaje u koordinaciji njihovih oktaedara TiO₆: rutil karakteriše manji koordinacioni broj ($v=8$), jer susedni oktaedri dele po 4 ivice i 4 roglja, dok kod anatas faze ($v=10$) dele 2 ivice i 8 rogljeva [22].

Efektivno nanelektrisanje Ti jona u anatas fazi je veće nego nominalno jonsko nanelektrisanje titanijuma ($Z=+4$), što se objašnjava mešanjem jonske i kovalentne veze. Kada se pozitivni (Ti) atom izmešta ka negativnom (O) atomu, dolazi do transfera elektrona od negativnog ka pozitivnom atomu, a ovakva polarizacija dovodi do hibridizacije veza Ti(3d)-O(2p) [5, 18].



Slika 1.3. Oktaedarska struktura TiO₂: anatas (a), rutil (b) i brukit (c).

Svaka od modifikacija TiO₂ kristala pripada različitoj prostornoj grupi i ima različite karakteristične normalne modove. *Rutil* pripada prostornoj grupi $P4_2/mnm$ (D_{4h}^{14}) sa $Z=2$ jedinice TiO₂ po primitivnoj celiji, a irreducibilna reprezentacija za optičke vibracijske modove u centru Brillouin-ove zone (BZ) je [3, 23, 24]:

$$\begin{aligned}\Gamma_{opt}^{RUTIL} = & A_{1g}(R) + A_{2g}(n) + B_{1g}(R) + B_{2g}(R) + E_g(R) + \\ & + A_{2u}(IC) + 2B_{1u}(n) + 3E_u(IC)\end{aligned}\quad (1.1)$$

⁵ U anatas TiO₂ postoje 4 popunjena TiO₆ oktaedra po jediničnoj celiji. Ostatak prostora unutar jedinične celije može se opisati pomoću anjonskih poliedara kojima nedostaju unutrašnji katjoni, tzv. *prazni poliedri*. Postoje takođe i 4 prazna O₆ oktaedra (lokalne simetrije D_{2d}) i 16 praznih O₄ tetraedara (C_2) [18]. Ovakva organizacija poliedara je ključna za kompresibilnost oktaedara: oktaedri TiO₆ se teško sabijaju, pošto su potpuno popunjeni, dok O₆ i O₄, kao "prazni", tj. bez centralnog katjona, trpe najveći deo naprezanja usled sabijanja ili širenja [18].

gde su sa R označeni Raman aktivni, sa IC modovi aktivni u infracrvenom spektru, a sa n optički neaktivni modovi. Monokristal rutila ima 4 Raman-aktivna moda (od kojih jedan dvostruko degenerisan) i 4 IC aktivna moda (3 dvostruko degenerisana E_u moda).

Anatas pripada prostornoj grupi $I4_1/AMD$ (D_{4h}^{19}), sa $Z=4$ i sledećim nerazloživim prikazivanjem optičkih modova [2, 3, 6]:

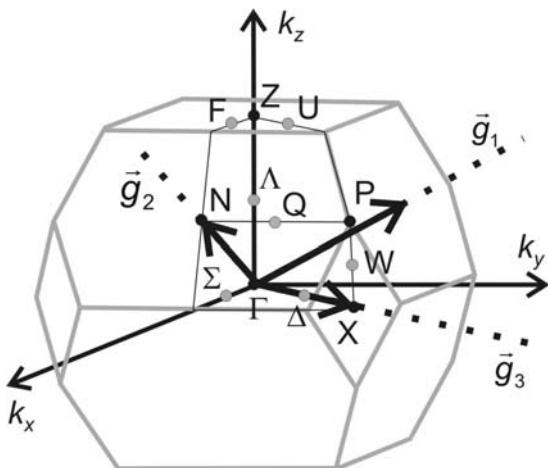
$$\begin{aligned}\Gamma_{opt}^{ANATAS} = & A_{1g}(R) + 2B_{1g}(R) + 3E_g(R) + \\ & + A_{2u}(IC) + B_{2u}(n) + 2E_u(IC)\end{aligned}\quad (1.2)$$

sa 6 Raman aktivnih (od čega su 3 dvostruko degenerisana E_g moda) i 3 IC aktivna optička moda (2 dvostruko degenerisana E_g moda).

Brukit je, za razliku od prethodne dve tetragonalne faza - ortorombičan, sa $Pbca$ (D_{4h}^{15}) prostornom grupom, sa $Z=8$ i nerazloživim prikazivanjem optičkih modova [2, 25]:

$$\begin{aligned}\Gamma_{opt}^{BRUKIT} = & 9A_{1g}(R) + 9B_{1g}(R) + 9B_{2g}(R) + 9E_{3g}(R) + \\ & + 9A_u(n) + 8B_{1u}(IC) + 8B_{2u}(IC) + 3E_{3u}(IC)\end{aligned}\quad (1.3)$$

sa 36 Raman aktivnih i 19 IC aktivnih modova.



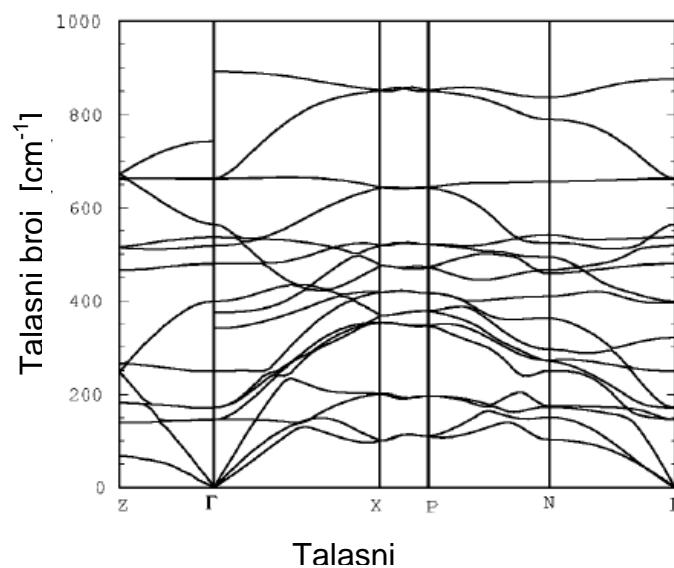
Slika 1.4. Prva Brillouin-ova zona anatas TiO_2 sa karakterističnim tačkama i pravcima visoke simetrije [26].

U slučaju anatas TiO_2 strukture, direktna Bravais-ova zapreminske centrirana tetragonalna rešetka u recipročnom prostoru preslikava se u površinski centriranu BZ. Na Slici 1.4. prikazana je prva Brillouin-ova zona, koja odgovara primitivnoj celiji kristala anatas TiO_2 , a karakteristične tačke, odnosno pravci visoke simetrije prikazani su u Tabeli 1.2 [26].

Tabela 1.2. Karakteristične tačke i pravci visoke simetrije u prvoj BZ anatas TiO₂ [26].

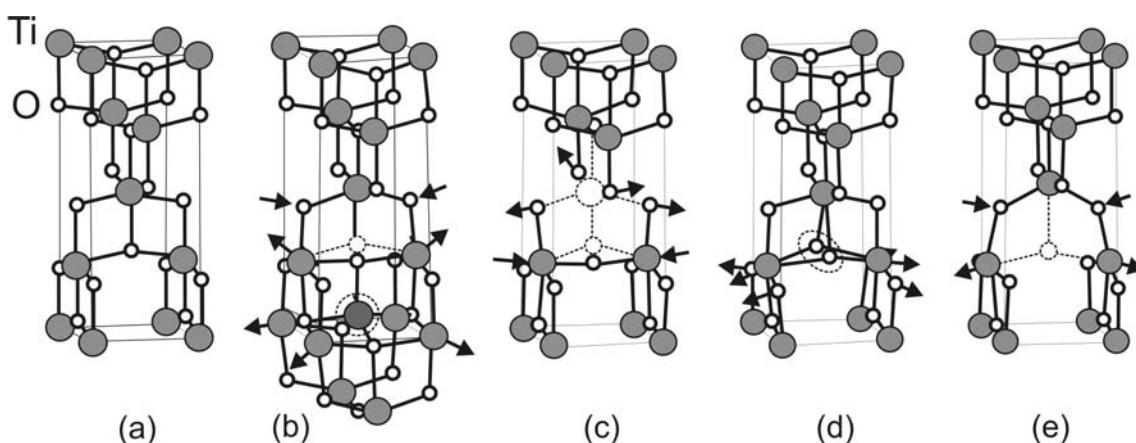
Tačka	Koordinate	Pravac	Koordinate	Simetrija
Γ	(0, 0, 0)	Δ (Γ -X)	(0, 0, α)	C_{2v}
N	(0, 1/2, 0)	Λ (Γ -Z)	($\bar{\alpha}$, α , α)	C_{2v}
X	(0, 0, 1/2)	Σ (Γ -Σ)	(α , α , $\bar{\alpha}$)	C_{4v}
P	(1/4, 1/4, 1/4)			
Z	(1/2, 1/2, -1/2)			

Za razliku od monokristala, kod kojih su vibracijska, odnosno optička svojstva određena samo uticajem fonona iz centra BZ, kod nanokristala u ovim procesima učestvuju fononi iz cele BZ. Imajući to u vidu, potrebno je detaljno poznavanje BZ, njenih dimenzija i karakterističnih pravaca. Na Slici 1.5. prikazane su teorijske fononske disperzije krive za anatas monokristal, tj. zavisnost učestanosti fonona od talasnog broja, $\omega(q)$. Ove funkcije su prvi predložili Mikami i saradnici [5] i to je jedini dostupan rezultet u do sada objavljenoj literaturi. S obzirom na veliki značaj koji ove funkcije imaju u ispitivanju optičkih svojstava nanomaterijala, posebno proračuna Ramanskih spektara, može se očekivati da će se u budućnosti pojaviti i odgovarajući eksperimentalni rezultati.

Slika 1.5. Fononske disperzije anatas TiO₂ monokristala [5].

1.1.2. Nestehiometrija i defekti kod anatas TiO_2

Efikasnost fotokatalitičkih procesa u kojima učestvuje vidljiva svetlost uglavnom zavisi od dva faktora: (1) apsorpcije poluprovodnika u vidljivoj oblasti, koja određuje početni broj nosilaca koji se stvaraju i (2) vremena koje je potrebno da se ekscitovani nosioci pokrenu do površine materijala, kako bi inicirali reakciju, u poređenju sa vremenom života nosilaca. TiO_2 se uspešno primenjuje kao poluprovodnički fotokatalizator. Njegov veliki energijski procepski predstavlja nedostatak, jer ne dozvoljava efikasnu apsorpciju vidljive svetlosti, što u velikoj meri ograničava njegovu primenu. Smanjivanje energijskog procepa može se postići dopiranjem ovog poluprovodnika, što je još uvek nedovoljno istraženo područje.



Slika 1.6. Struktura (a) kristalnog anatas TiO_2 , (b) Ti_i^{4+} , (c) $\text{V}_{\text{Ti}}^{4+}$, (d) $(\text{O}_2)_\text{O}$ i (e) V_O^{2+} defekti (velike sfere predstavljaju Ti atome, a male O atome) [27].

Manipulacija veličinom energijskog procepa pre svega zahteva razumevanje uloge sopstvenih defekata u anatas TiO_2 . Koncentracija sopstvenih defekata obično zavisi od uslova sinteze, kao i od prisustva hemijskih nečistoća, što u mnogome otežava eksperimentalna istraživanja u ovoj oblasti. Na-Phattalung i saradnici [27] prikazali su proračun sopstvenih defekata u anatas TiO_2 , koji daje detaljne informacije o atomskoj strukturi i elektronskim svojstvima titanijumskih vakancija (V_{Ti}), kiseoničnih vakancija (V_O), Ti intersticija (Ti_i) i O intersticija (O_i), koje imaju veoma malu, čak negativnu energiju formiranja, u zavisnosti od uslova sinteze. Atomska struktura navedenih defekata prikazana je na Slici 1.6. Ovi autori su zaključili da je Ti_i četvorostruki donor

sa veoma malom energijom formiranja i da je ovaj defekt verovatno najodgovorniji za sopstvenu provodnost n tipa zapaženu u TiO_2 . S druge strane, iako V_O ima veću energiju formiranja od Ti_i , očekuje se da je kinetička barijera za stvaranje V_O iz savršenog TiO_2 niža od one za stvaranje Ti_i . Odatle je naknadno formiranje V_O moguće, posebno nakon dugotrajnog zagrevanja uzorka. Naime, V_O defekti, kao dvostruki donori, iako nisu dominantni sopstveni defekti u uslovima sinteze bliskim ravnotežnim, mogu biti formirani u odgovarajućim procesima (kao što je odgrevanje, koje dovodi do stvaranja nestehiometrijskog TiO_2) [27]. Četvorostruki akceptor V_{Ti} je akceptor najniže energije u TiO_2 . Dakle, u nedopiranim uzorcima Ti_i i V_{Ti} bi trebalo da budu vodeći donor, odnosno akceptor. Formiranje Ti_i pojačano je u uslovima sinteze sa viškom Ti, dok formiranje V_{Ti} dominira u uslovima bogatim kiseonikom. Zaključeno je takođe da se intersticijski kiseonik O_i spontano veže za kiseonik u kristalnoj rešetki, formirajući električno neutralni O_2 , koji zauzima mesto kiseonika u rešetki. Međutim, proračuni koje su izveli ovi autori [27] pokazali su da ni jedan od ovih niskoenergijskih defekata ne dovodi do pojave defektnih nivoa unutar zabranjene zone, što nije u skladu, kako sa rezultatima eksperimentalnih istraživanja, tako ni sa proračunima drugih autora.

Naime, mnogi autori smatraju da kiseonične vakancije (V_O) igraju dvostruku ulogu u TiO_2 materijalima, tako što svaka vakancija dodaje dva elektrona u sistem, ali i proizvodi lokalizovana stanja unutar energijskog procepa [28]. Ovi efekti posebno dolaze do izražaja u nestehiometrijskim uzorcima. Postojanje lokalizovanih stanja vezanih za kiseonične vakancije potvrđeno je, kako teorijskim proračunima gustine stanja [28, 29], tako i eksperimentalnim putem [30-32]. Pored toga, kao vid površinskih defekata, kiseonične vakancije neraskidivo su vezane sa Ti defektima na površini materijala, i ne samo da formiraju svoje energijske nivoe (i zone) unutar energijskog procepa, već i učestvuju u izgradnji složenijih defekata [33-36]. Ove pojave su posebno izražene u nanomaterijalima koje karakteriše veliki odnos površine i zapremine materijala.

1.1.3. Anatas TiO₂ nanoprahovi

1.1.3.1. Sinteza anatas nanoprahova

Laserska sinteza prahova, gde se kao polazne supstance koriste razne smeše gasova a kao izvor zračenja CO₂ laser, zasniva se na rezonantnoj apsorpciji infracrvene laserske energije od strane reagujućih gasova, što dovodi do njihovog zagrevanja u maloj reakcionaloj zapremini. Lasersko zračenje je direktno apsorbovano gasnim molekulima, tako da se cela reakcija odvija duž laserskog snopa u ograničenoj zapremini. Kada gasni molekuli dostignu određenu temperaturu, dolazi do njihove disocijacije. Stvaraju se radikali u osnovnom ili pobuđenom stanju, koji se međusobno sudsaraju. U sudsaru tako dobijenih radikala dolazi do hemijske reakcije, koja je odgovorna za dalji proces stvaranja (nukleacije) i rasta čestica prahova. Ovaj proces je praćen vidljivim plamenom, što pokazuje da je hemijska reakcija u toku. Dovoljno je da u ovom procesu molekuli jednog od gasnih reaktanata apsorbuju lasersko zračenje, jer će se ostali pobuditi sudsarima. Prednosti ove metode u tome što se za veoma kratko vreme (0.1 s i manje) postiže veoma visoka temperatura ($> 1000^{\circ}\text{C}$) neophodna za stvaranje radikala i početak hemijske reakcije, koja dovodi do formiranja prahova. Zahvaljujući koherentnosti laserskog snopa, reakcionala zona je veoma dobro lokalizovana, pa je efikasnost reakcije veoma velika (skoro 100 %). Veličina, sastav i stehiometrija rastućih čestica se može precizno kontrolisati podešavajući osnovne parametre procesa kao što su: laserska snaga, pritisak u reaktoru, protok reagujućih gasova kao i ukupni protok gasova. Ovi parametri utiču na temperaturu reakcije od koje zavisi dalji tok reakcije kao i karakteristike proizvedenog praha. Odsustvo kontaminacije, precizna kontrola čitavog procesa, velika efikasnost reakcije, kao i reproducibilnost, glavne su karakteristike laserski indukovane pirolize. Zato se slobodno može reći da je laserska sinteza jedan od najboljih metoda za dobijanje ultrafinih prahova koji poseduju idealne karakteristike.

Nanoprahovi anatas TiO₂ sintetisani su metodom laserski indukovane pirolize. Kao polazna supstanca za dobijanje prahova koristila se gasna smeša: titanijum tetrahlorida (TiCl₄) i izopropilnog (etilnog) alkohola, koristeći kao izvor zračenja kontinualni CO₂ laser (P(20) emisiona linija na $\lambda=10.6\text{ }\mu\text{m}$) izlazne snage do 500 W,

marke Rofin Sinar RS 500. Detaljan opis aparature za dobijanje anatas TiO₂ nanoprahova dat je u referenci [37].

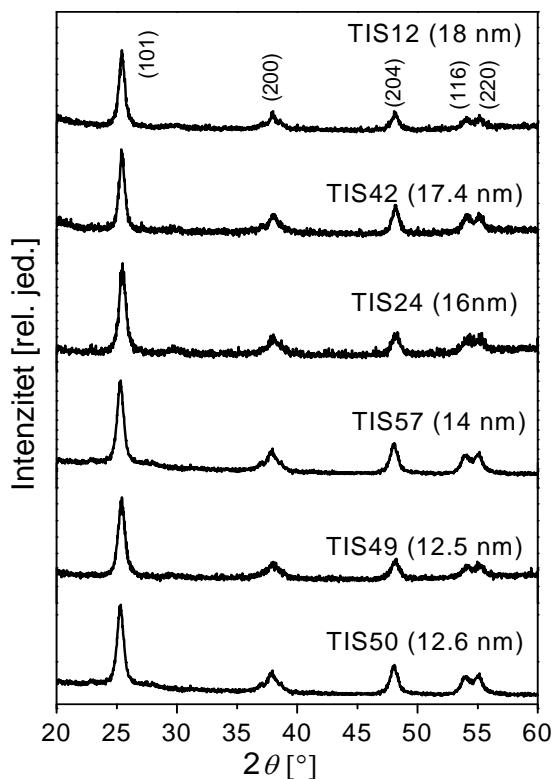
1.1.3.2. Karakterizacija anatas nanoprahova

Kristalna struktura anatas nanoprahova određena je metodom difrakcije X-zraka (XRD), na Siemens D500/D501 difraktometru koristeći karakteristično CuK α zračenje na sobnoj temperaturi. XRD spektri anatas TiO₂ nanoprahova, koji su dobijeni pri različitim osnovnim parametarima sinteze i imaju različite dimenzije kristalita, prikazani su na Slici 1.7. Difrakcioni pikovi karakteristični za anatas fazu su prisutni u svim spektrima, dok druge faze TiO₂ nisu registrovane ni u jednom od ovih uzoraka [38, 39]. Pojava slabih difrakcionih pikova na $2\theta \approx 30^\circ$ u uzorcima TIS12, TIS24 i TIS49 upućuje na moguće prisustvo male količine čistog titanijuma [40]. Srednja dimenzija nanokristalita procenjena je iz glavnog (101) difrakcionog pika. Integralna širina difrakcionog pika β_{int} rezultat je širenja, koje nastaje usled male dimenzije kristalita i širenja usled naprezanja kristalne rešetke. Integralna širina na polovini visine pika izvedena je iz izmerene širine B i korigovana za instrumentalno širenje b . Ovde je uzeta tzv. *empirijska korekcija* u obliku $\beta_{int} = B - b^2/B$. Uticaji dimenzije čestice i naprezanja u nanokristalima mogu se razdvojiti primenom *Williams-Hall-ovih grafika* [41, 42], korišćenjem jednačine:

$$\beta_{int} = \beta_d + \beta_n = \frac{K\lambda}{\langle d \rangle_{XRD} \cos \theta} + 4\varepsilon \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad (1.4)$$

gde je λ talasna dužina CuK α zračenja (1.5418 Å), K je tzv. faktor oblika (sa vrednošću oko 0.9), θ je Bragg-ov ugao refleksije, $\langle d \rangle_{XRD}$ srednja veličina kristalita ⁶, dok ε predstavlja relativnu promenu međuravanskog rastojanja u nanokristalnom uzorku u odnosu na monokristal, nastalu usled mikronaprezanja. Grafik zavisnosti $\beta_{int}\cos\theta$ od $4\sin\theta$ daje veličinu kristalita $\langle d \rangle_{XRD}$ na osnovu vrednosti odsečka na ordinati, a naprezanje (ε) na osnovu nagiba [42]. Dimenzija $\langle d \rangle_{XRD}$ i naprezanje izraženo u % (ε) za sve uzorce anatas TiO₂ nanopraha sa Slike 1.7. prikazani u Tabeli 1.3.

⁶ Kada jednačina (1.4) ima samo prvi član, svodi se tzv. *Sherrer-ovu jednačinu*.



Slika 1.7. XRD spektri anatas TiO_2 nanoprahova.

Specifična površina S_{BET} sintetisanih nanoprahova određivana je BET⁷ metodom i u velikoj meri zavisi od načina pripreme nanoprahova. Iz specifične površine procenjena je srednja dimenzija nanokristalita pomoću formule $\langle d \rangle_{BET} = 6/(S_{BET} \cdot \rho)$, gde je $\rho=3.79 \text{ g/cm}^3$ gustina anatas TiO_2 [17], uz pretpostavku da su sve čestice približno sfernog oblika i slične veličine. Vrednosti izmerene specifične površine i iz nje procenjene prosečne dimenzije nanočestice takođe su prikazane u Tabeli 1.3. Dobro slaganje veličine nanočestice $\langle d \rangle_{BET}$ sa vrednostima $\langle d \rangle_{XRD}$ dobijenim iz XRD merenja ukazuje na činjenicu da su pojedine nanočestice odmah po sintezi (*as-grown*) imale monokristalnu strukturu.

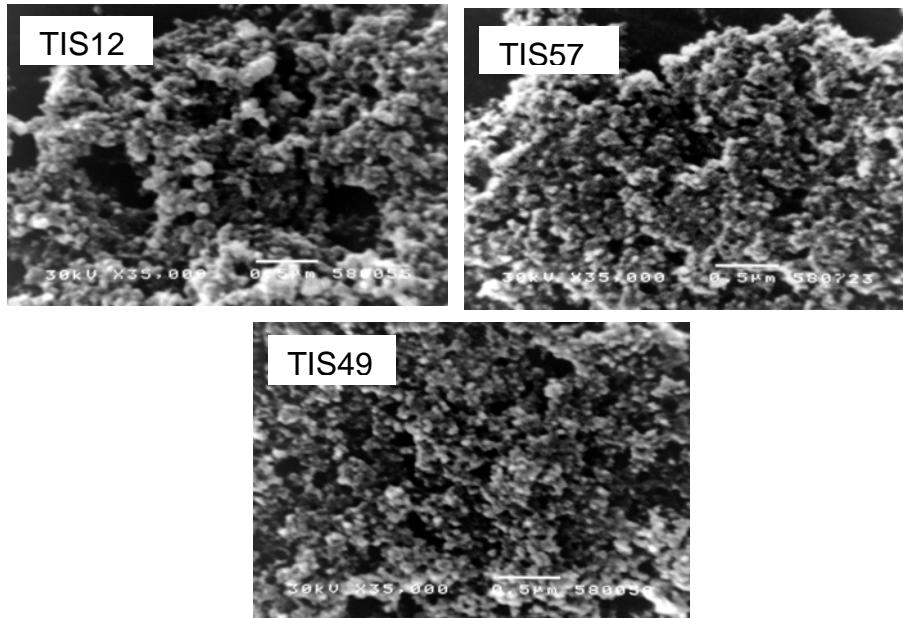
⁷ BET, Brunauer-Emmett-Teller-ova metoda, zasnovana na adsorpciji molekula azota na površini čvrstog materijala.

Tabela 1.3. Srednja dimenzija nanočestice za anatas TiO₂ nanoprahove, procenjena metodama XRD, BET i SEM.

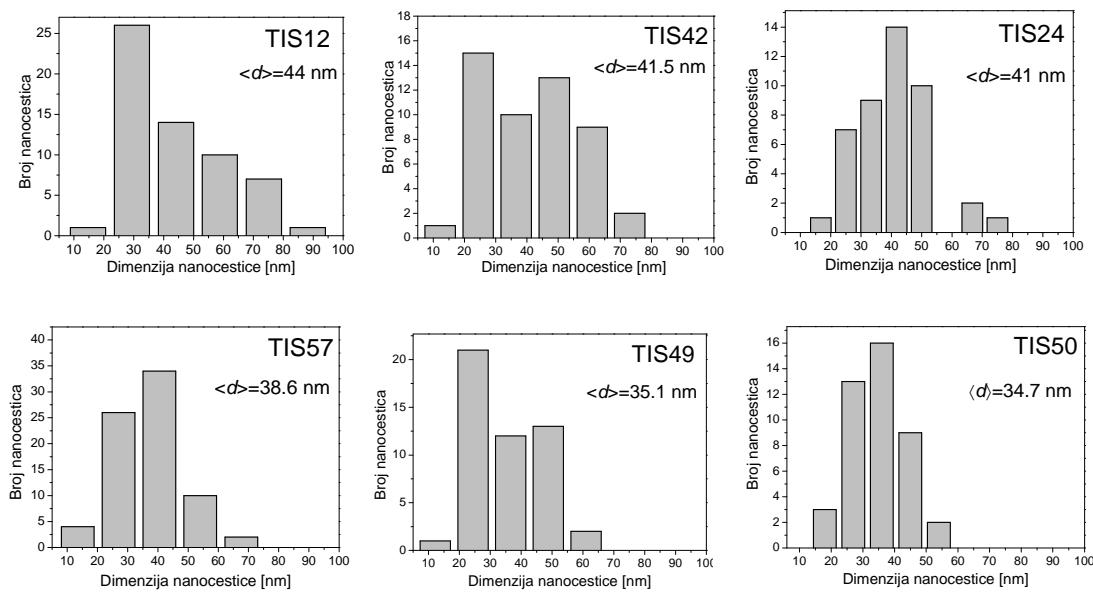
Uzorak TiO ₂	XRD		BET		SEM
	$\langle d \rangle_{XRD}$ [nm]	ε [%]	S_{BET} [m ² /g]	$\langle d \rangle_{BET}$ [nm]	$\langle d \rangle_{SEM}$ [nm]
TIS12	18	0.22	84	19.5	44.0
TIS42	17.4	0.17	77	20.6	41.5
TIS24	13.5	0.08	104	15.2	41.0
TIS57	13.7	0.80	110	14.4	38.6
TIS49	12.5	0.03	109	14.5	35.1
TIS50	12.6	0.19	93	17.0	34.7

Primenom JEOL-JSM-5300 skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM), pri ubrzavajućem naponu od 30 kV, snimljena je površina anatas TiO₂ nanoprahova. Distribucija veličine nanočestice određena je sa SEM mikrograфа pomoću programa GSD1 [43] razvijenog u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku. Na Slici 1.8. prikazani su odabrani SEM mikrografi uzorka TIS12, TIS57 i TIS49. Odgovarajući rezultati procene distribucije i prosečne dimenzije nanočestice $\langle d \rangle_{SEM}$ za sve uzorce prikazani su na Slici 1.9. Analizom SEM mikrograфа za navedene uzorce, ustanovljeno da se prosečna dimenzija nanočestica kreće od $\langle d \rangle_{SEM}=44$ nm za uzorak TIS12 do $\langle d \rangle_{SEM}=34.7$ nm za TIS57. Pri tome je distribucija većiline nanočestica izrazito asimetrična kod uzorka TIS12, TIS42 i TIS49. Procenjeno je takođe da su čestice u svim uzorcima približno sfernog oblika.

Veće dimenzije nanočestica (2 do 3 puta) dobijene procenom SEM rezultata u odnosu na XRD i BET rezultate, posledica su aglomeracije nanopraha, što je i inače česta pojava kod nanoprahova [44]. Pri tome je uočeno da je stepen aglomeracije nešto izraženiji kod uzorka sa manjom dimenzijom nanočestice, kod kojih je $\langle d \rangle_{SEM}/\langle d \rangle_{XRD} \approx 3$, za razliku od krupnijih prahova, kod kojih ovaj odnos iznosi ≈ 2 . (videti Tabelu 1.3)



Slika 1.8. SEM mikroografi odabranih anatas TiO_2 nanoprahova.



Slika 1.9. Distribucije dimenzije nanočestice za različite anatas TiO_2 nanoprahove procenjene iz odgovarajućih SEM mikrografova.

1.2. Cerijum dioksid (CeO_2)

1.2.1. Struktura i svojstva CeO_2

Cerijum dioksid pripada grupi oksida retkih zemalja (lantanidi). Kao materijal sa visokim indeksom prelamanja i visokom transparentnošću u vidljivoj i bliskoj IC oblasti, veoma je cenjen kod višeslojnih optičkih naprava. Spada u klasu širokozonskih poluprovodnika sa energijskim procepom $E_g \sim 3.2$ eV [45], mada ga neki autori klasifikuju i kao izolator [46, 47]. Poslednjih godina ovaj materijal u nanometarskim dimenzijama privlači veoma mnogo pažnje, jer ima značajno drugačija svojstva od odgovarajućeg kristala. Dopiranje CeO_2 dovodi do stvaranja velikog broja anjonskih vakancija, zbog čega dolazi do povećanja jonske provodnosti [48], što otvara nove perspektive u primeni dopiranih nanoprahova. Zbog velike sposobnosti skladištenja kiseonika [49], CeO_2 i složeniji sistemi izvedeni iz njega koriste se u različitim oblastima, kao što su katalizatori, optičke prevlake, jonski provodnici, gasni senzori i, kao najvažnije, elektroliti u čvrstim gorivnim ćelijama⁸ [45, 50-54]. Primena nanometarskog CeO_2 u oblastima katalize, superjonskih provodnika i čvrstih oksidnih gorivnih ćelija uticala je na dalja istraživanja, sa ciljem da se razjasne do sada neuobičajene pojave, posebno u zavisnosti od dimenzije nanočestice [42, 50].

Oksiđi retkih zemalja su intenzivno istraživani za mnoge primene u optici i elektronici i katalizi, zahvaljujući pre svega prisustvu $4f$ elektronske ljeske [47]. Cerijum je prvi element u periodnom sistemu sa delimično popunjrenom f orbitalom, koja je eksperimentalno locirana kao uska zona između provodne i valentne zone [46]. Sposobnost CeO_2 da u katalitičkim procesima skladišti kiseonik popunjavajući vakancije u oksidacionim uslovima i da ga otpušta u redukcionim, povezana je sa kvantnim procesima lokalizacije i delokalizacije $4f$ elektrona. Sva 4 valentna elektrona u CeO_2 napuštaju Ce atome i prelaze u p orbitalu dva kiseonična atoma [46, 47].

Otpuštanje velikog broj O atoma iz kristalne rešetke (redukcija) i ponovno popunjavanje njihova mesta (vakancije) novim O atomima (oksidacija), osnovno je

⁸ Solid oxide fuel cells (SOFC).

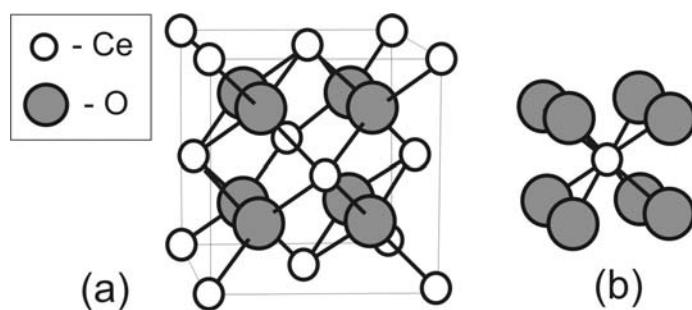
svojstvo koje se zahteva od materijala za gorivne ćelije. Ovi procesi treba da budu brzi i visoko reverzibilni, tako da se serija redukcija i oksidacija materijala može obaviti mnogo puta. Do povećanja kapaciteta transporta kiseonikovih atoma dolazi i dopiranjem trovalentnim elemenatima retkih zemalja iz serije lantanida [55-57], kao i dvovalentnim dopanatima, kao što su npr. Ca^{2+} [58] ili Ba^{2+} [59]. Pokazalo se da se fluoritna struktura CeO_2 ne narušava značajno dopiranjem, te da je zbog toga pogodna za izučavanje uticaja dopiranja na mehanizme provođenja.

Senzorska svojstva ovog materijala zasnovana su na površinskim reakcijama, koje nastaju pri izlaganju gasovima, kojima posebno pogoduje nanokristalni oblik oksida, zbog velikog odnosa površine i zapremine u materijalu, zbog čega je ispitivanje veličine, oblika i sastava CeO_2 sistema poslednjih godina privuklo veoma veliku pažnju [53, 60]. Sa druge strane, primena u srednjetemperaturskim ($400 - 700^\circ\text{C}$) čvrstim gorivnim ćelijama najavljuje čistu tehnologiju efikasnog elektrohemijskog generisanja elektriciteta, sa mnoštvom prednosti u poređenju sa tradicionalnom sistemima za konverziju energije, što uključuje visoku efikasnost i pouzdanost [61-63]. Većina ovih primena zasniva se na karakterističnoj jonskoj provodnosti CeO_2 [57, 64], koja se modifikuje promenom svojstava materijala, dimenzijsama nanočestice, kao i dopiranjem [56, 58]. Kod jonskih provodnika, proticanje struje je zasnovano na kretanju jona kroz kristalnu rešetku, pa je od izuzetne važnosti da u kristalu postoje nezauzete lokacije, tj. kiseonične vakancije. Pri tome povećavanje jonske, a smanjivanje elektronske komponente struje, predstavlja važan tehnološki zahtev u realizovanju ovakvih naprava [64]. Većina praktičnih primena CeO_2 bazira se na reakciji redukcije između Ce^{4+} i Ce^{3+} , tako da je proučavanje zavisnosti svojstava nanomaterijala od dimenzije nanočestice postalo usko povezano sa određivanjem odnosa $\text{Ce}^{3+}/\text{Ce}^{4+}$ u nanometarskim CeO_2 kristalima [42]. Pokazalo se i da se veća koncentracija Ce^{3+} jona očekuje u materijalu sa sitnijim nanočesticama [65].

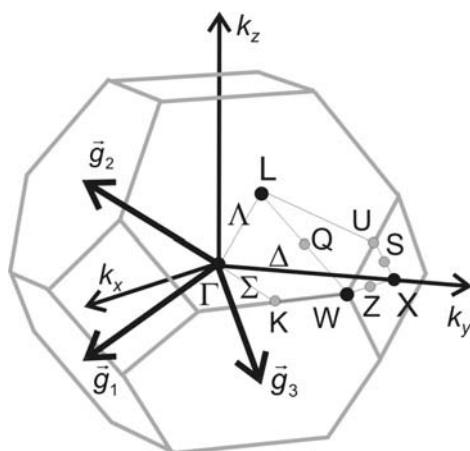
CeO_2 kristališe kao kubična fluoritna struktura, prikazana na Slici 1.10(a), sa prostornom grupom $Fm\bar{3}m$ (O_h^5), gde primitivna ćelija sadrži samo jednu gradivnu jedinicu ⁹ CeO_2 . Ce atom se nalazi na poziciji (0,0,0), dva O atoma na pozicijama $\pm(1/4, 1/4, 1/4)$, odnosno na Wyckoff-ovim pozicijama 4a i 8c, redom, sa lokalnim simetrijama O_h i T_d . Valentnost cerijuma u oksidima predstavlja važan parametar, tako

⁹ Formula unit.

da četvorovalentni cerijum (Ce^{4+}) po pravilu formira CeO_2 (poznat i kao cerijum (IV) oksid) sa kubičnom fluoritnom rešetkom, dok trovalentni Ce^{3+} formira Ce_2O_3 (cerijum (III) oksid), sa heksagonalnom rešetkom i prostornom grupom $P\bar{3}ml (D_{3d}^3)$ [26]. Obe oksidne strukture su optički transparentne u vidljivom i visoko apsorbujuće u ultraljubičastom spektru. Najčešći i uobičajeni cerijumov oksid je CeO_2 , koji je stabilan i u substehiometrijskoj formi CeO_{2-x} , gde $0 < x < 0.4$ [66]. Smatra se takođe da u kristalnom cerijum dioksidu prisustvo trovalentnog Ce^{3+} dovodi do smanjenja energijskog procepa [66].



Slika 1.10. Površinski centrirana kubična (fluoritna) rešetka CeO_2 : jedinična celija (a) i lokalno okruženje Ce atoma (b).



Slika 1.11. Prva Brillouin-ova zona sa karakterističnim pozicijama i pravcima visoke simetrije [26].

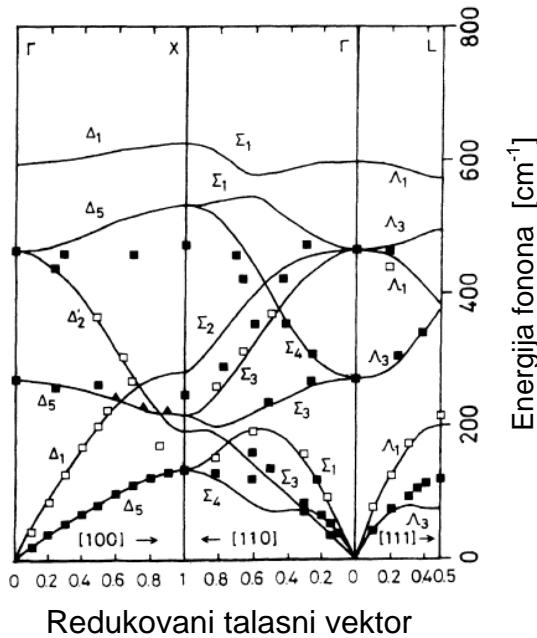
Kristalna struktura CeO_2 ima 6 optičkih fononskih grana, sa 3 aktivne učestanosti u centru Brillouin-ove zone. Pregled pravaca visoke simetrije, zajedno sa karakterističnim tačkama prve Brillouin-ove zone prikazane na Slici 1.11. dat je u Tabeli 1.4. Analiza faktor grupe daje sledeće optičke vibracijske modove

$$\Gamma_{opt} = F_{2u} + F_{2g}, \quad (1.5)$$

gde je trostruko degenerisani F_{2g} mod jedini Raman aktivan (na 465 cm^{-1}), dok je F_{2u} mod aktivan samo u IC spektru, (na oko 272 cm^{-1} (dvostruko degenerisani TO mod) i 595 cm^{-1} (nedegenerisani LO mod)) [49, 67].

Tabela 1.4. Karakteristične tačke i pravci visoke simetrije u BZ CeO_2 [26].

Tačka	Koordinate	Simetrija	Pravac	Koordinate	Simetrija
Γ	(0, 0, 0)	$m3m (O_h)$	$\Delta (\Gamma-X)$	$(\alpha, 0, \alpha)$	$4mm (C_{4v})$
X	(1/2, 0, 1/2)	$4/mmm (D_{4h})$	$\Lambda (\Gamma-L)$	(α, α, α)	$3m (C_{3v})$
L	(1/2, 1/2, 1/2)	$\bar{3}m (D_{3d})$	$\Sigma (\Gamma-\Sigma)$	$(\alpha, \alpha, 2\alpha)$	$mm2 (C_{2v})$
W	(1/2, 1/4, 3/4)	$\bar{4}2m (D_{2d})$	S (X-S)	$(1/2+\alpha, 2\alpha, 1/2+\alpha)$	$mm2 (C_{2v})$
			Z (Z-W)	$(1/2, \alpha, 1/2+\alpha)$	$mm2 (C_{2v})$
			Q (L-W)	$(1/2, 1/2-\alpha, 1/2+\alpha)$	$2 (C_2)$



Slika 1.12. Teorijske fononske disperzije krive u CeO_2 kristalu (Nakajima i saradnici iz ref. [55]) sa eksperimentlanim rezultatima dobijenim neelastičnim neutronskim rasejanjem [68].

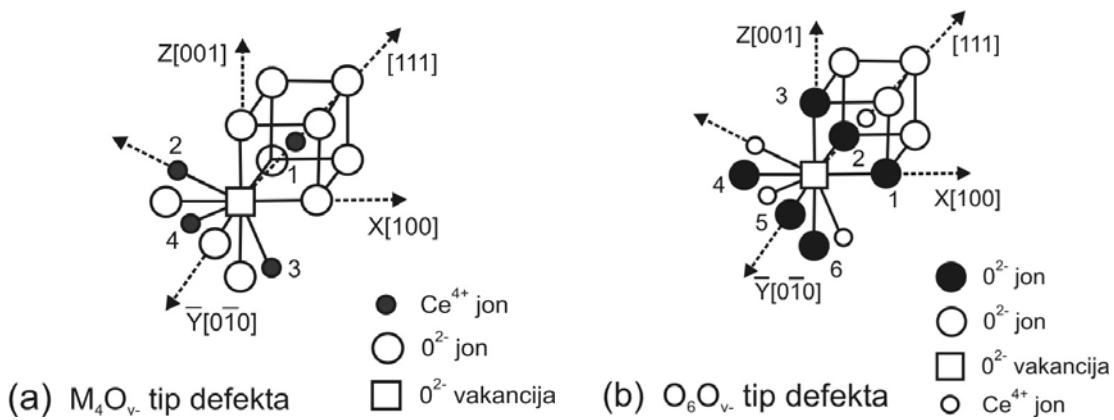
Na Slici 1.12. prikazane su fononske disperzije krive u CeO_2 kristalu, računate duž pravaca visoke simetrije karakterističnih za fluoritnu strukturu. Nakajima i saradnici [55] su praktično prvi dobili dovoljno dobro slaganje teorijskih fononskih disperzija sa

eksperimentalnim rezultatima dobijenim primenom neutronskog rasejanja. Ovi eksperimentalni rezultati, koje su dali Clausen i saradnici [68], prikazani su na istoj slici simbolima, gde puni kvadrati označavaju transverzalne, a otvoreni longitudinalne modove.

1.2.2. Nestehiometrija i defekti kod CeO₂

Poznavanje strukture defekata posebno je važno za realizaciju mehanizma jonskog provođenja. U literaturi su razmatrane dve vrste defekata kod CeO₂: dopanti i/ili kiseonične vakancije [46].

CeO₂ spada u materijale sa dobrom jonskom provodnošću, zahvaljujući svojstvu da se u kristalnoj rešetki mogu naći joni mešane valence (Ce³⁺ i Ce⁴⁺), pri čemu, da bi se očuvala elektroneutralnost kristalne rešetke, u rešetki istovremeno nastaju i tzv. *sopstvene (unutrašnje)* kiseonične vakancije. Zato se CeO₂ danas često koristi kao elektrolit u čvrstim gorivnim ćelijama, jer nanokristalni CeO₂, zbog veće specifične površine i granice zrna, ima znatno veću jonsku provodnost u odnosu na monokristal. Budući da se provodnost povećava sa smanjenjem zrna, veoma je bitno da čestice imaju uniformne dimenzije i preciznu stehiometriju.

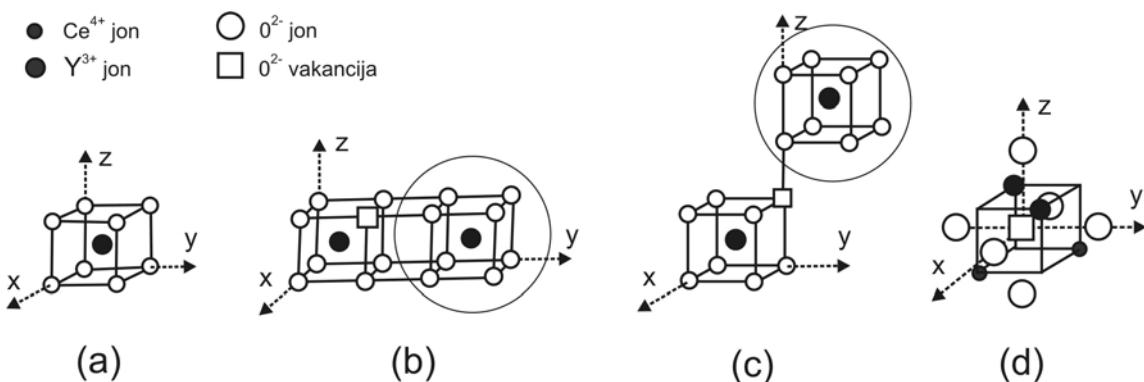


Slika 1.13. M₄O_v. (a) i O₆O_v (b) tip defekata prema ref. [55].

Nakajima i saradnici [55] izložili su pretpostavku da je prostor defekta u CeO₂ složen i da ga čine O²⁻ vakancija i 4 metalna jona (*M*) kao prvi susedi (u ovom slučaju Ce joni,

kada se radi o pojavi unutrašnjih vakancija), dok se u poziciji sledećih suseda iste vakancije nalazi 6 kiseoničnih (O^{2-}) jona. Vibracijska stanja defekata u velikoj meri zavise od toga da li su najbliži susedi vakancije metalni joni (tzv. M_4O_{v-} tip defekta sa simetrijom T_d , gde je O_{v-} vakancija O^{2-} okružena metalnim jonima, kako je prikazano na Slici 13(a)) ili su to kiseonični joni (tzv. O_6O_{v-} tip defekta, sa simetrijom O_h , gde je vakancija okružena O^{2-} jonima, kao na Slici 13(b)).

Analizirajući vibracijske modove ovih defekata, Nakajima i saradnici [55] pokazali su da će se vibracijske učestanosti, koje potiču od tipa defekata M_4O_{v-} pojaviti samo u niskofrekventnom regionu ramanskog spektra ($<250\text{ cm}^{-1}$), dok se vibracije O_6O_{v-} javljaju u celoj oblasti učestanosti, usled velike razlike u masama izmedju Ce^{4+} i O^{2-} jona. Ova razlika omogućava međusobnu nezavisnost vibracija koje potiču od M_4O_{v-} i O_6O_{v-} tipova defekata, mada se može očekivati da linearna kombinacija ova dva modela najrealnije objašnjava eksperimentalni ramanski spektar [55].



Slika 1.14. Prikaz četiri vrste defekata, kakve se prema Nakajima et al. [55] mogu očekivati u $Ce_{1-x}Y_xO_{2-\delta}$.

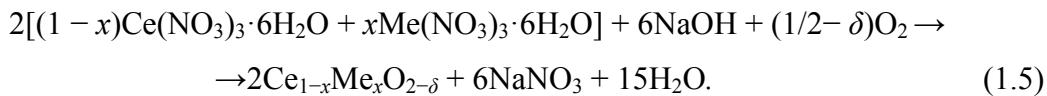
Na Slici 1.14. ilustrovani su defekti koji uključuju prisustvo katjona dopanta. Tip defekta MO_8- , gde je M katjon dopanta (Y), sa očuvanom simetrijom fluoritne rešetke (O_h) prikazan je na Slici 1.14(a). Ovaj defekt ne sadrži O^{2-} vakancije i Nakajima i saradnici [55] sugerisu da se ovaj tip defekta sa povećanjem koncentracije dopanta postepeno gubi u odnosu na druge tipove defekata. Na osnovu merenja neutronskim rasejanjem Anderson i Nowick [69] došli su do zaključka da se defektno stanje može, kao što je prikazano na Slici 1.14(b) i (c), razložiti na prostor koji sadrži O^{2-} vakanciju i prostor koji obuhvata tip defekta MO_8- . Ova oblast sa dopantom podseća na tip MO_8-

(Slika 1.14(a)), od kog se razlikuje samo po tome, što usled uticaja susedne O²⁻ vakancije, promena ravnotežnih položaja izvodi sistem iz O_h simetrije. Defekt prikazan na Slici 1.14(d) ne može se razložiti na prethodno opisani način, pa se njegova vibracijska stanja razlikuju od stanja defekta tipa MO_8 . (Slika 1.14(a)).

1.2.3. CeO₂ nanoprahovi

1.2.3.1. Sinteza CeO₂ nanoprahova

Uzorci čistog CeO₂ i čvrstih rastvora CeO₂ sa itrijumom (Y) i neodimijumom (Nd), koji su predmet ovog istraživanja, sintetisani su metodom *samopropagirajuće sinteze na sobnoj temperaturi*¹⁰ [44]. Ova metoda pogodna je za dobijanje prahova sa uskom distribucijom dimenzija nanočestice. Kao polazni materijali korišćeni su cerijum nitrat i natrijum hidroksid, kao i itrijum/neodimijum nitrat kod dopiranih uzoraka. Priprema Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ} nanoprahova izvedena je mešanjem hemikalija u skladu sa relacijom:

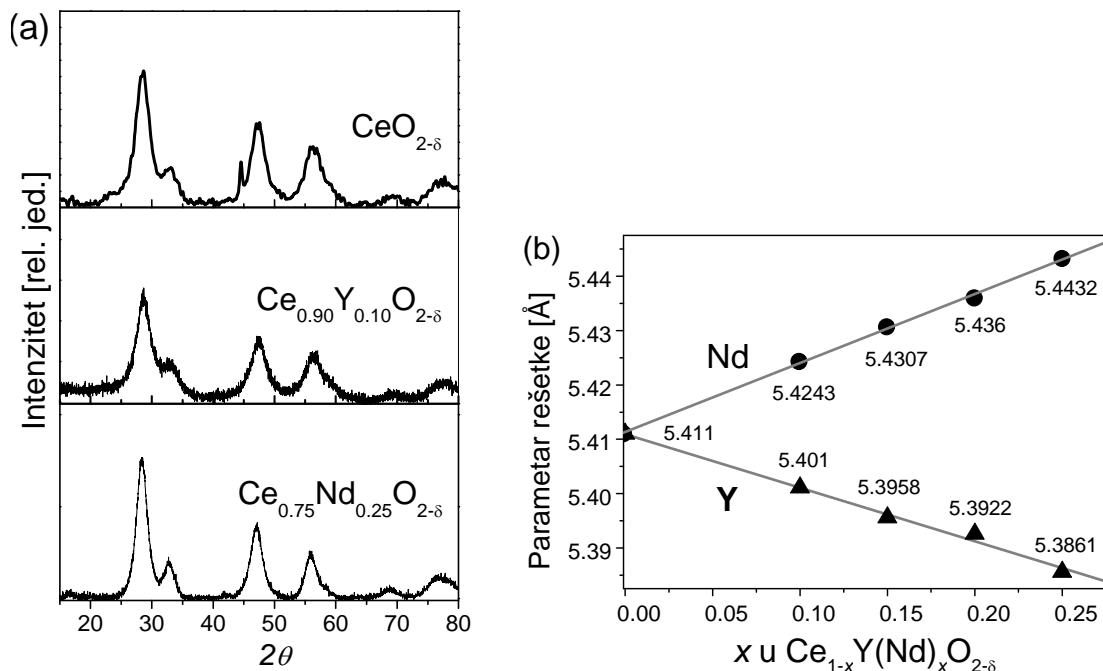


Količine metalnih nitrita, kao i natrijum hidroksida, izračunate su u cilju dobijanja nominalne kompozicije čvrstih rastvora. Kompozicije Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ} nanoprahova sintetisane su u opsegu x od 0 do 0.25. Ručno mešanje vršeno je sve dok mešavina nije dobila svetlo braon boju. Posle oko tri sata stajanja na vazduhu, mešavina je rastvorena u vodi. Ova procedura je ponavljana nekoliko puta, pre konačnog sušenja prahova. Uvođenjem mehaničke energije u sistem očekuje se da se reakcija ubrzano odvija na sobnoj temperaturi i na vazduhu. Oslobađanje vode iz nitrata čini ručnu homogenizaciju prahova lakšom i dovodi do bliskog kontakta reagujućih čestica tokom mešanja, što, sa druge strane, dovodi do ubrzavanja reakcije. Stajanje na vazduhu omogućava da se reakcija do kraja izvrši prema jednačini (1.5).

¹⁰ *Self-propagating room temperature* (SPRT).

1.2.3.2. Karakterizacija CeO₂ nanoprahova

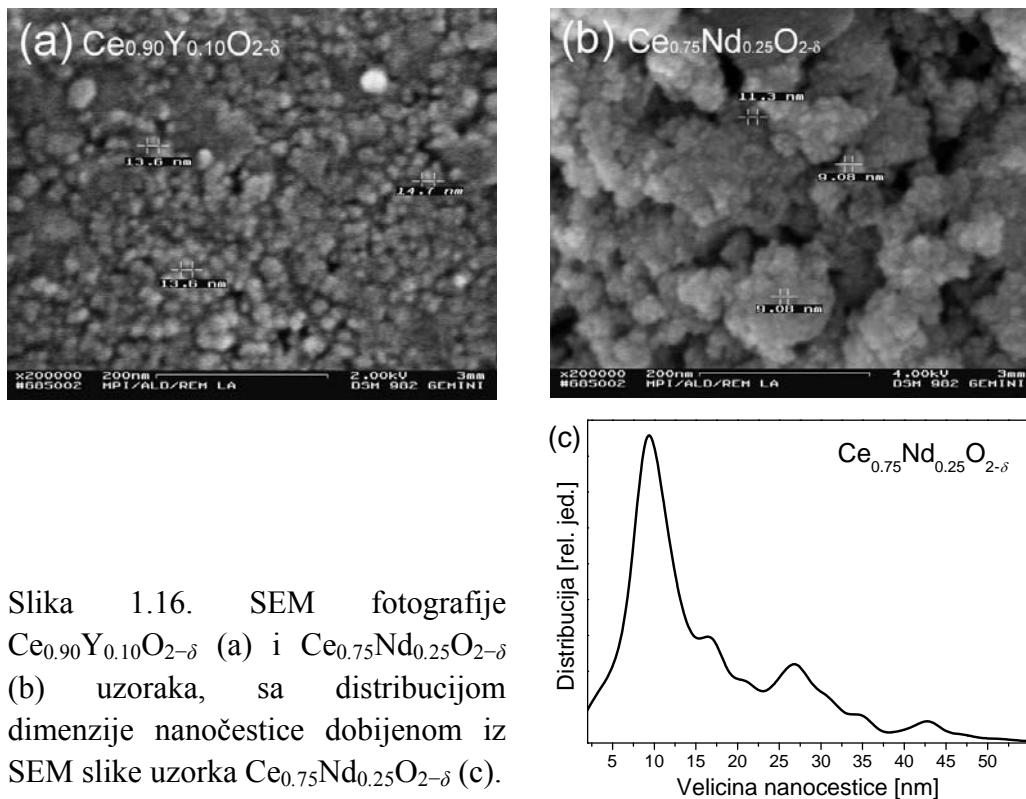
Nakon sušenja, struktura ovih čvrstih rastvora identifikovana je metodom XRD na Siemens D-5000 XRD difraktometru sa Cu K α zračenjem na sobnoj temperaturi. Srednja dimenzija nanočestica za čist CeO₂, kao i za obe serije dopiranih uzoraka Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2- δ} nanoprahova, izračunata je iz (111) difrakcionog pika primenom Sherrer-ove formule. SEM analiza pomoću Zeiss DSM 982 Gemini skenirajućeg elektronskog mikroskopa potvrdila je da su dimenzije dobijenih prahova u nanometarskom opsegu.



Slika 1.15. (a) XRD spektri uzoraka čistog CeO₂ i dopiranih nanoprahova Ce_{0.90}Y_{0.10}O_{2- δ} i Ce_{0.75}Nd_{0.25}O_{2- δ} i (b) promena parametra kristalne rešetke u Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2- δ} nanoprahovima (0.10≤x≤0.25).

XRD rezultati za uzorce dopirane Y i Nd [44] pokazuju da su uzorci čvrsti rastvori u celom opsegu dopiranja, zadržavajući pri tome CeO₂ fluoritnu strukturu. Difrakcione linije Y₂O₃ i Nd₂O₃ takođe nisu registrovane u celom opsegu dopiranja ($x=0.1-0.25$). Struktura XRD spektara izabranih dopiranih uzoraka Ce_{0.90}Y_{0.10}O_{2- δ} i Ce_{0.75}Nd_{0.25}O_{2- δ} prikazana je na Slici 1.15(a), zajedno sa XRD spektrom CeO_{2- δ} nanopraha. Širina XRD pikova sugerise da su sintetisane čestice čistog i dopiranih

nanoprahova u okviru nanometarske skale, sa prosečnom dimenzijom kristalita između 4 i 6 nm (procenjene Williams-Hall-ove grafičke metode, kako je opisano u poglavlju 1.1.3.2.), dok kod termički tretiranih prahova na 600°C tokom 4 sata dolazi do značajne aglomeracije prahova, sa česticama dimenzija 13-27 nm [44, 70, 71].



Slika 1.16. SEM fotografije Ce_{0.90}Y_{0.10}O_{2-δ} (a) i Ce_{0.75}Nd_{0.25}O_{2-δ} (b) uzoraka, sa distribucijom dimenzije nanočestice dobijenom iz SEM slike uzorka Ce_{0.75}Nd_{0.25}O_{2-δ} (c).

Promena parametra kristalne rešetke u zavisnosti od koncentracije dopanata (Y, Nd) prikazana je na Slici 1.15(b). Ona je u skladu sa Vegardovim zakonom, koji predviđa da se parametar rešetke linearno menja sa kompozicijom čvrstog rastvora [44, 56]. Pri tome, parametar kristalne rešetke direktno je proporcionalan veličini jonskog radiusa dopanta: veći dopant (Nd) dovodi do širenja kristalne rešetke, dok manji dopant (Y) izaziva njen smanjivanje [72].

Odabrane SEM fotografije dopiranih nanoprahova Ce_{0.90}Y_{0.10}O_{2-δ} i Ce_{0.75}Nd_{0.25}O_{2-δ} prikazane su na Slici 1.16.(a) i (b). Analiza SEM rezultata pokazala je da je prečnik čestice u obe serije uzoraka ima usku raspodelu koja se grupiše oko srednje vrednosti od 10 nm, kako je prikazano distribucijom na Slici 1.16(c).

Tabela 1.5. Veličina kristalita (XRD), čestica (SEM) i specifična površina (BET) čistog CeO₂ i netretiranih dopiranih prahova Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ} gde $0.10 \leq x \leq 0.25$, kao i veličina kristalita (XRD) termički tretiranih dopiranih prahova [44, 71].

Sastav	d_{XRD}^a [nm]	d_{XRD}^b [nm]	d_{SEM}^a [nm]	S_{BET}^a [m ² /g]
CeO ₂	4.2	26.7	16	106.9
Ce _{0.90} Y _{0.10} O ₂	4.3	21.0	14	103.2
Ce _{0.85} Y _{0.15} O ₂	4.2	20.1		137.1
Ce _{0.80} Y _{0.20} O ₂	5.0	18.8		109.7
Ce _{0.75} Y _{0.25} O ₂	5.6	17.9		94.0
Ce _{0.90} Nd _{0.10} O ₂	4.4	17.0		118.4
Ce _{0.85} Nd _{0.15} O ₂	4.4	14.8		137.6
Ce _{0.80} Nd _{0.20} O ₂	4.2		10	141.5
Ce _{0.75} Nd _{0.25} O ₂	4.1	13.3		99.6

a - netretiran prah; b - termički tretirani prahovi na 600°C u vazduhu 4 sata

U Tabeli 1.5. prikazane su veličine kristalita dobijene iz XRD merenja, veličine čestica dobijene SEM merenjima i specifične površine (BET) čistog CeO₂ i netretiranih dopiranih prahova Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ} gde $0.10 \leq x \leq 0.25$, kao i veličina kristalita (XRD metod) termički tretiranih dopiranih prahova [44, 71]. Razlika, koja se uočava između XRD i SEM rezultata, može biti posledica činjenice da XRD sa Sherrer-ovom formulom daje prosečne dimenzije pojedinačnih kristalita, dok SEM mikrograf reflektuje dimenzije aglomerisanih čestica, koje se sastoje od više nanokristalita [44].

2. RAMANSKA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA

Ramanska spektroskopija je metoda vibracijske spektroskopije značajna za karakterizaciju vibracijskih svojstava amorfnih i kristalnih nanomaterijala. Budući da su vibracije kristalne rešetke veoma osetljive na interakcije najbližih suseda, ovom metodom mogu se detektovati lokalno atomsko uređenje i kratkodometno uređenje u nanosistemima, odnosno kristalna struktura i kvalitet materijala, čak i na vrlo niskim dimenzijama (reda parametra kristalne rešetke).

Merenja ramanskog rasejanja koriste se za analizu različitih nanomaterijala, kao što su kvantne tačke, kvantne jame, nanožice, nanoprahovi, nanokompoziti, novi keramički materijali, biometrijali itd. Iz promene položaja i širine ramanskog moda u odnosu na zapreminski kristal, može se dobiti informacija o dimenziji nanočestica, kao i njihovoj distribuciji, zatim o defektima i neuređenosti materijala, mikronaprezanju i Grüneisen-ovom parametru niskodimenzionih sistema, faznim prelazima u kvantnim sistemima, koncentraciji dopanata u poluprovodničkim nanomaterijalima itd [1, 73].

Na osnovu ramanskih intenziteta, koji odgovaraju nekim fononima, mogu se dobiti informacije o elektronskoj strukturi i elektron-fonon interakcijama u nanostrukturama. Iz ramanskog spectra moguće je kvantitativno opisati relativan odnos površinskih i zapreminskih fonona, proceniti stehiometriju materijala i predvideti mnogo novih termičkih, električnih, magnetskih i mehaničkih svojstava nanomaterijala.

2.1. Teorijske osnove ramanske spektroskopije

Broj vibracija koje se mogu pobuditi kod kristalnih čvrstih materijala metodama IC i ramanske spektroskopije iznosi $3N-3$, što je i najveći broj opservabilnih oscilacija u kristalu¹¹. Neke od ovih oscilacija mogu biti simetrijski ekvivalentne (odnosno energijski degenerisane), pri čemu se neke od njih javljaju u IC, a neke u ramanskom spektru, a neke nisu aktivne ni u jednom, u skladu sa selepcionim pravilima [74]. Budući da je čak i vidljiva svetlost ima veliku talasnu dužinu u poređenju sa dimenzijama jedinične celije kristala, i IC i ramanska spektroskopija primarno pobuđuju vibracije koje su u fazi između različitih jediničnih celija (centar BZ). Ostale vibracije se mogu dobiti primenom eksperimenata sa kraćim talasnim dužinama, kao što je neutronsko rasejanje. U tom slučaju se kraćom talasnom dužinom može karakterisati disperzija (promena energije) vibracije, jer periodičnost vibracija postaje duža od jedinične celije, pa se vibracije dešavaju dalje od centra BZ (kada vibracije susednih elementarnih celija nisu u fazi) [75]

2.1.1. Klasična teorija ramanskog rasejanja

Ramansko rasejanje je, za razliku od elastičnog Rayleigh-jevog rasejanja, *neelastičan proces* izazvan (nekim) kvazi-ekscitacijama u materijalu. To mogu biti vibracijski modovi u molekulu, fononi u kristalu, plazmoni, magnoni itd. [73, 76].

U klasičnoj teoriji ramanskog efekta molekuli se posmatraju kao skup atoma koji vrše proste harmonijske vibracije, pri čemu se kvantovanje vibracijske energije ne uzima u obzir [77]. U molekulu koji se nalazi u električnom polju elektroni se izmeštaju u odnosu na jezgro, što proizvodi električni dipolni moment. Ramansko rasejanje opisuje se promenom *polarizabilnosti* molekula.

Kada je molekul izložen promenljivom električnom polju

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left(\frac{2\omega_0 t}{\pi}\right), \quad (2.1)$$

¹¹ N atoma u jediničnoj celiji kristala, sa 3 translaciona stepena slobode cele elementarne celije koji pripadaju akustičkim (Brillouin-ovim oscilacijama).

gde je \vec{E}_0 jačina polja u ravnotežnom položaju, a ω_0 ugaona učestanost zračenja, njegov dipolni moment dat je izrazom

$$\vec{p} = \vec{\mu} + \alpha \vec{E}, \quad (2.2)$$

gde $\vec{\mu}$ predstavlja stalni dipolni moment, dok je $\alpha \vec{E}$ dipolni moment indukovani delovanjem električnog polja, sa istom učestanošću vibracija. Polarizabilnost α se u opštem slučaju predstavlja dvodimenzionalnim tenzorom, α_{ij} , čija struktura zavisi od simetrije molekula [73, 74].

Kada se radi o malim vibracijama, koordinate oscilujućeg molekula mogu se aproksimirati sa $q_n(t) = q_{n0} \cos(\omega_n t)$, gde je q_{n0} amplituda, a ω_n učestanost n -tog normalnog moda. Tada se ukupni dipolni moment predstavlja razvojem u Taylorov red [73]:

$$\begin{aligned} \vec{p} = & \vec{\mu}_0 + \alpha_{ij}(0) \vec{E}_0 \cos(\omega_0 t) + \\ & + \sum_{n=1}^{\Omega} \left(\frac{\partial \vec{\mu}}{\partial q_n} \right)_0 q_{n0} \cos(\omega_n t) + \\ & + \frac{1}{2} \vec{E}_0 \sum_{n=1}^{\Omega} \left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial q_n} \right)_0 q_{n0} [\cos(\omega_0 + \omega_n)t + \cos(\omega_0 - \omega_n)t] \end{aligned} \quad (2.3)$$

gde su u razvoju $\vec{\mu}$ i $\alpha \vec{E}$ po q_n praktično zadržani samo prvi članovi. Drugi član ove jednačine predstavlja elastično *Rayleigh-jevo rasejanje*, treći opisuje *infracrveni*, a četvrti član *ramanski proces*. Da bi vibracija bila Raman aktivna, neophodno je da se polarizabilnost menja tokom oscilovanja molekula [78], odnosno da bude ispunjen sledeći uslov

$$\left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial q_n} \right)_{q=0} \neq 0, \quad (2.4)$$

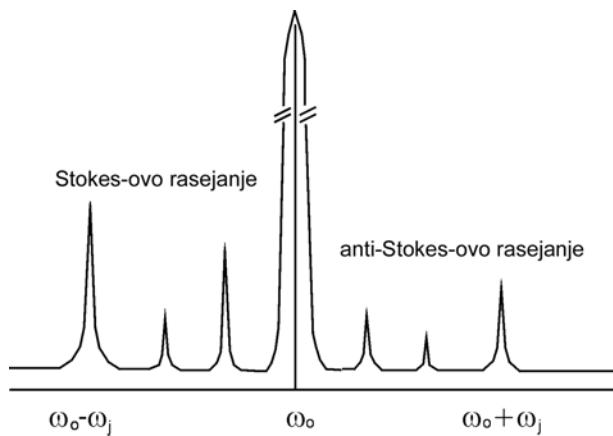
odnosno, da se menja dipolni moment, da bi vibracija bila aktivna u infracrvenom spektru

$$\left(\frac{\partial \vec{\mu}}{\partial q_n} \right)_{q=0} \neq 0. \quad (2.5)$$

I ramanska i IC spektroskopija mere vibracijsku energiju, a da li će normalna vibracija biti aktivna u jednom ili drugom spektru, određeno je selepcionim pravilima [74]. Komplementarnost ramanskog i IC spektra zasniva se na ovim pravilima - kada su u

pitanju centralno simetrične strukture, tada ramanska i infracrvena spektroskopija registruju različite normalne vibracije, dok, ukoliko struktura nema centar simetrije, ove dve tehnike mogu da pobuđuju iste vibracijske nivoje [73, 74].

Merenje ramanskog spektra kristala jedna je od glavnih metoda za dobijanje informacije o vibracijama kristalne rešetke. Opšte tumačenje ramanskog efekta je odavno poznato, kao i mehanizmi nekih suptilnijih efekata u okviru ramanskog rasejanja [78, 79]. Najjednostavnije rečeno, upadni snop svetlosti može da interaguje sa kristalom tako što će stvoriti ili uništiti jedan ili više kvanata vibracija rešetke (fonona) i energija dobijena ili izgubljena u kristalnoj rešetki se kompenzuje ili smanjenjem ili povećanjem učestanosti rasejane svetlosti.



Slika 2.1. Šematski prikaz ramanskog spektra.

Vrednost intenziteta talasnog vektora \vec{k} Raman aktivnog fonona prvog reda ima malu vrednost u poređenju sa dimenzijama kristalne rešetke u kristalnom materijalu što daje mogućnost za velika pojednostavljenja u tumačenju [79]. Kada se kristal izloži dejstvu monohromatskog zračenja učestanosti ω_0 , u spektru rasejane svetlosti pojavljuje se jedan veoma jak mod na učestanosti ω_0 i serija mnogo slabijih na učestanostima $\omega_0 + \omega_n$ i $\omega_0 - \omega_n$, gdje su ω_n učestanosti *optičkih fonona*. Jak mod na ω_0 je posledica elastičnog ili Rayleigh-evog rasejanja, a modovi na $\omega_0 \pm \omega_n$ potiču od neelastičnog rasejanja fotona na fononima i čine *ramanski spektar*. Ramanski modovi na $\omega_0 - \omega_n$ su tzv. Stokes-ove, a modovi na $\omega_0 + \omega_n$ anti-Stokes-ove linije. Anti-Stokes-ove linije su

mnogo slabijeg intenziteta od Stokes-ovih [78], kako je i ilustrovano na šematskom prikazu ramanskog spektra na Slici 2.1. Kao što je već rečeno, procesi Stokes-ovog i anti-Stokes-ovog rasejanja odgovaraju neelastičnom rasejanju foton, pri čem je deo njihove energije potrošen na neku od mogućih eksitacija kristala. U opštem slučaju, eksitacije ne odgovaraju samo *fononima* (elementarnim vibracijama kristalne rešetke), već i *magnonima* (elementarnim vibracijama magnetne rešetke), eksitaciji kristalnog polja, i sl [78].

Treba naglasiti da klasična teorija daje dobre rezultate u pogledu predviđanja pojave i učestanosti pojedinih modova, ali ne i u vezi njihovih intenziteta. Jedan od prilaza u teorijskom izračunavanju intenziteta rasejane svetlosti zasniva se na tzv. *principu korespondencije*, prema kojem se dipolni moment indukovani u kristalu tretira kvantno-mehanički (koristeći standardni vremenski-zavisni perturbacioni metod), dok se svetlost emitovana od strane dipola (rasejana svetlost) opisuje klasično [78].

2.1.2. Kvantna teorija ramanskog rasejanja

Budući da je kompletna kvantna teorija rasejanja svetlosti veoma kompleksna [77, 78], ovde će biti dat samo kvalitativan pregled.

U terminima korpuskularne teorije svetlosti Rayleigh-ovo rasejanje odgovara elastičnom sudarnom procesu između fotona i kristala, dok ramansko rasejanje odgovara neelastičnom sudaru, u kojem foton gubi jedan ili više kvanata vibracijske energije (Stokes-ove linije), ili prima jedan ili više takvih kvanata (anti-Stokes-ove linije). U rasejanju prvog reda u ovaj proces je uključen samo jedan fonon, a u rasejanju drugog reda - dva fonona [74, 78].

Neka je parom (ω_L, \vec{k}_L) označen upadni foton koji dolazi od lasera, gde je ω_L učestanost, \vec{k}_L talasni vektor, (ω_r, \vec{k}_r) rasejani foton, a (ω_j, \vec{q}) - optički fonon koji učestvuje u procesu rasejanja. Budući da važi zakon održanja energija i momenta između početnog i krajnjeg stanja sistema, za Rayleigh-ovo rasejanje važi [74, 78]:

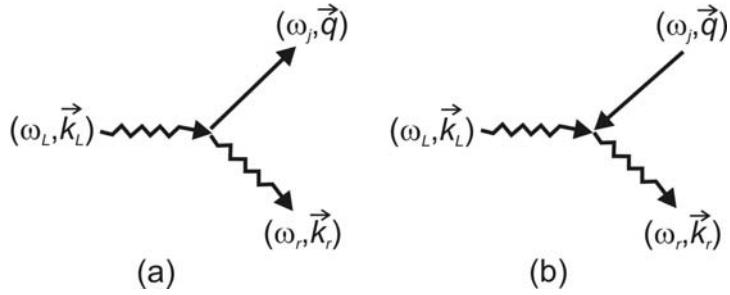
$$\omega_L = \omega_r \quad \text{i} \quad (2.6)$$

$$\vec{k}_L = \vec{k}_r, \quad (2.7)$$

dok je za ramansko rasejanje

$$\omega_L = \omega_r \pm \omega_j(\vec{q}) \text{ i} \quad (2.8)$$

$$\vec{k}_L = \vec{k}_r \pm \vec{q}. \quad (2.9)$$



Slika 2.2. Ilustracija Stokes-ovog (a) i anti-Stokes-ovog procesa (b) [78].

U Stokes-ovom procesu se stvara fonon (ω_j, \vec{q}) (znak "+" u jednačinama (2.8) i (2.9)), dok u anti-Stokes-ovom procesu fonon nestaje (znak "-" u istim jednačinama). Ova dva procesa su ilustrovana na Slici 2.2. Kako je $\omega_L \gg \omega_j(\vec{q})$, iz jednačine (2.8) sledi da je $\omega_L \approx \omega_r$.

Uopšte posmatrano, eksperimenti se izvode na učestanostima na kojima u suštini nema disperzije indeksa prelamanja n , tj. u oblasti *transparencije* kristala. Kako su \vec{k}_L i \vec{k}_r talasni vektori unutar kristala, tada je

$$k_L = \frac{2\pi}{\lambda_L}, \quad (2.10)$$

$$k_r = \frac{2\pi}{\lambda_r}, \quad (2.11)$$

gde su

$$\lambda_L = \lambda_v / n(\omega_L), \quad (2.12)$$

$$\lambda_r = \lambda_v / n(\omega_r), \quad (2.13)$$

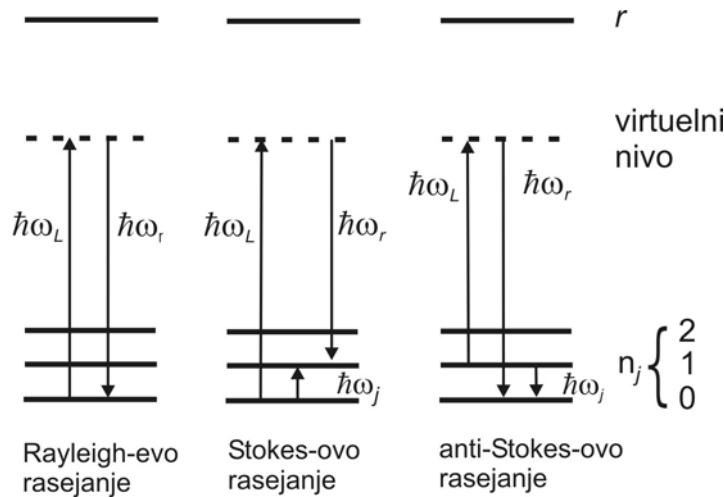
a $n(\omega_L)$ i $n(\omega_r)$ indeksi prelamanja koji redom odgovaraju upadnoj i rasejanoj svetlosti i λ_v talasna dužina u vakuumu. Iz odnosa $c = v\lambda_v$, dobija se

$$k_L = n(\omega_L) \frac{\omega_L}{c}, \quad (2.14)$$

$$k_r = n(\omega_r) \frac{\omega_r}{c}, \quad (2.15)$$

Kako je $\omega_L \approx \omega_r$, sledi da je i $k_L \approx k_r$. Osim toga, vrednosti λ_L i λ_r su mnogo veće od parametra rešetke a_0 , pa su k_L i k_r mnogo manji od amplitude talasnog vektora na granici Brillouin-ove zone, π/a_0 . Zbog toga, u skladu sa jednačinom (2.9) sledi da je $q \ll \pi/a_0$, što znači da u ramanskom rasejanju prvog reda mogu biti pobuđeni samo optički modovi za koje važi $q \approx 0$ [78].

Na Slici 2.3. prikazani su prelazi kod Rayleigh-evog i Stokes-ovog i anti-Stokes-ovog rasejanja prvog reda.



Slika 2.3. Ilustracija prelaza kod Rayleigh-jevog rasejanja, Stokes-ovog rasejanja prvog reda i anti-Stokes-ovog rasejanja prvog reda [78].

Treba imati u vidu da je *virtuelni nivo* uveden u ovu diskusiju isključivo radi ilustracije procesa perturbacije elektronske talasne funkcije kristala usled ulaska fotona energije $\hbar\omega_L$. Naime, kada fotoni energije $\hbar\omega_L$ padnu na površinu kristala, dolazi do njihove interakcije sa elektronima u kristalu, koji jedini mogu da prate brze promene elektromagnetskog polja. Dakle, fotoni vrše perturbaciju elektronske funkcije stanja, koja se može predstaviti kao linearna kombinacija svih mogućih talasnih funkcija neperturbovanog kristala sa vremenski zavisnim koeficijentima. Formalno gledano, kao da je kristal dobio nestacionarni energijski nivo više energije, pri čemu se smatra da

perturbacija pripada samom kristalu. Budući da ovo stanje ne odgovara ni jednom postojećem stacionarnom energijskom stanju, govori se o virtuelni nivou, čijim posredstvom kao da kristal dospeva u neko od stacionarnih stanja kroz proces emitovanja fotona. Klasičnim jezikom rečeno, virtualni nivo odgovara prinudnim oscilacijama elektrona sa učestanošću upadne svetlosti ω_L [78].

U procesu rasejanja drugog reda upadni foton (ω_L, \vec{k}_L) pobuđuje kristal iz početnog elektronskog i vibracijskog stanja u virtuelno stanje. Kristal tada emitiše rasejani foton (ω_r, \vec{k}_r) i prelazi iz virtuelnog stanja u konačno elektronsko i vibracijsko stanje koje se razlikuje od početnog stanja za *dva* vibracijska kvanta. U ovakovom procesu rasejanja uključeni fotoni mogu biti ili akustički ili optički, ili kombinacija optičkih i akustičkih. Kada su uključena dva optička moda reč je o *Ramanskom rasejanju drugog reda*. Treba napomenuti da ramanski spektri drugog reda uključuju doprinos parova fonona iz cele prve Brillouin-ove zone [78].

Ako se učestanost upadnog zračenja približava učestanosti elektronskog prelaza (elektronski nivo r na Slici 2.3), intenzitet ramanskih modova se jako pojačava. Ramanski spektri dobijeni sa pobudnim učestanostima blizu zona apsorpcije, tj. apsorpcionih prelaza nazivaju se *rezonantni ramanski spektri*.

2.1.3. Temperaturska zavisnost ramanskog spektra

Još jedno značajno svojstvo ramanskog spektra je jaka zavisnost anti-Stokes-ove komponente od temperature. Na visokim temperaturama Stokesova i anti-Stokes-ova komponenta spektra imaju uporedive intenzitete, dok sa snižavanjem temperature anti-Stokesova komponenta značajno gubi na intenzitetu. Kada temperatura nije previše visoka, usled veće popunjenoosti osnovnog vibracijskog nivoa u odnosu na pobudjene nivoje (videti Sliku 2.3. u prethodnom poglavljiju), u ramanskom spektru je intenzitet Stoksove komponente značajno veći od anti-Stoksove [78, 80], što znači da je znatno manja verovatnoća da upadno zračenje zatekne sistem u pobuđenom nego u osnovnom stanju. Imajući u vidu da anti-Stokes-ova i Stokes-ova komponenta ramanskog spektra redom odgovaraju apsorpciji i emisiji optičkog fonona, odnos njihovih intenziteta definisan je odnosom populacija fonona u osnovnom i pobuđenom stanju, odnosno

Bose-Einstein-ovom statistikom [78, 81] i proporcionalan je $\exp(\hbar\omega_j/k_B T)$. Zato se ovaj odnos koristi za određivanje lokalne temperature uzorka iz merenih intenziteta Stoksovog i anti-Stoksovog signala u ramanskom spektru [78, 80, 82]:

$$\frac{I_{Stokes}}{I_{anti-Stokes}} = \left(\frac{\omega_L - \omega_S}{\omega_L + \omega_S} \right)^4 \exp(\hbar\omega_S/k_B T), \quad (2.16)$$

gde je ω_L učestanost laserskog zračenja, ω_S učestanost Stoks-ove komponente ramanskog rasejanja, \hbar Planck-ova konstanta, k_B Boltzmann-ova konstanta i T lokalna temperatura uzorka. Treba imati u vidu da ova relacija isključivo važi u uslovima ravnoteže u adijabatskoj aproksimaciji, koji često nisu ispunjeni kod nanomaterijala [83]. Uobičajeno je da se lokalno zagrevanje realizuje povećavanjem snage lasera, kada nije moguće precizno eksperimentalno merenje temperature uzorka. Zbog toga ovaj način određivanja temperature često dovodi do grešaka, kada je procenjena temperatura uzorka po pravilu viša, ali se ova tehnika i dalje veoma često koristi, posebno kada nisu u pitanju mnogo visoke temperature [82, 83].

2.2. Uredaj za ramansku spektroskopiju

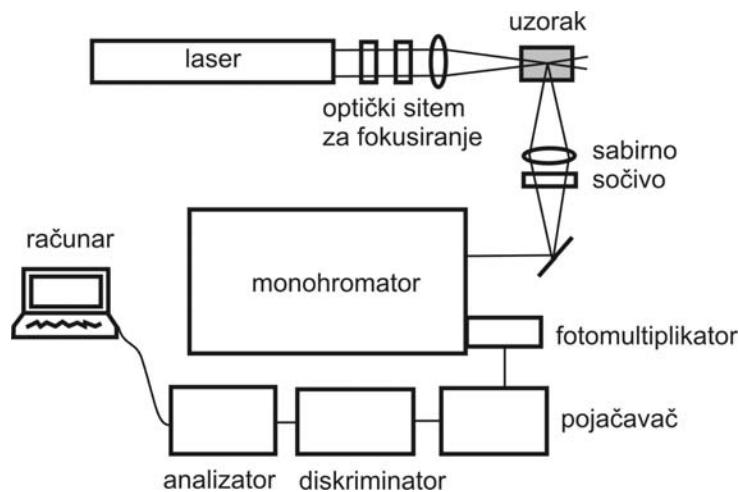
U ovom poglavlju će biti opisan uređaj za ramansku spektroskopiju, koji se nalazi u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku, na kome su dobijeni svi ramanski i fotoluminescentni spektri prikazani u ovom radu.

Kao izvor svetlosti u uredjaju za snimanje ramanskog spektra korišćen je argonski (Ar) gasni laser, koji omogućava kontinualnu emisiju i veliki izbor linija iz vidljivog dela spektra. Laser kao izvor svetlosti ima niz prednosti u odnosu na druge izvore (npr. živinu lampu), kao što su dobra frekventna i prostorna kolimacija usled duge laserske šupljine, velika izlazna snaga i dobro definisana polarizacija. Glavni nedostatak ovih izvora svetlosti je pojava plazma linija gasnog pražnjenja, koje mogu zakloniti ramanske signale. Ove plazma linije se otklanjaju pomoću odgovarajućih filtera koji se postavljaju izmedju lasera i uzorka.

Uredaj za snimanje Raman spektara šematski je prikazan na Slici 2.4. Monohromatska svetlost iz izvora (laser) prolazi kroz sistem ogledala i sočiva, čime se

fokusira na uzorak. Veličina i oblik fokusiranog snopa na uzorku zavise od vrste primjenjenog sočiva za fokusiranje: *cilindrično sočivo* daje linijski fokus, maksimalnih dimenzija reda 0.5×3 mm), dok *sabirno sočivo* daje tačkasti fokus prečnika oko 0.1 mm. Svetlosni snop se rasejava na uzorku, a rasejana svetlost prikuplja objektivom i usmerava na ulaz monohromatora u kome se razlaže po učestanostima. Zatim se svetlost usmerava u detektor, gde se pretvara u električni signal, koji se dalje pojačava i odvodi u diskriminator [84]. Impulsi dobijeni iz diskriminatora se analiziraju u višekanalnom analizatoru i konačno obraduju i smeštaju u memoriju računara. Konfiguracija kojom se upadni signal fokusira na uzorak zavisi od vrste uzorka (npr. da li je proziran ili ne), kao i od pojave koju želimo da ispitujemo (fononi, magnoni, polaroni itd.).

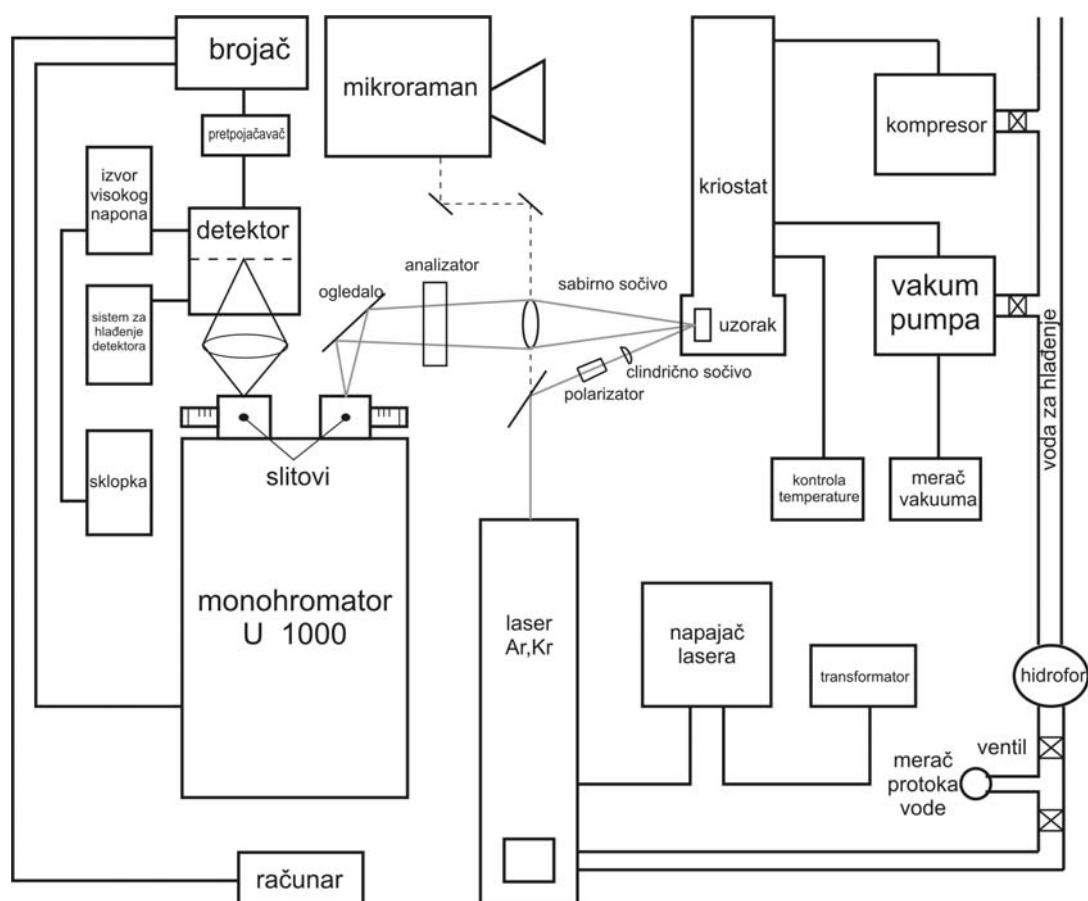
U okviru istraživanja prikazanih u ovom radu korišćen je U1000 Jobin Yvon monohromator sa dve holografski zapisane rešetke veličine 110×110 mm² sa 1800 zareza/mm. Svetlost koja ulazi u monohromator razlaže se po talasnim dužinama sinhronim rotiranjem rešetaka, tako da je najmanji korak 0.1 cm^{-1} . Rezolucija iznosi oko 0.15 cm^{-1} na 579.1 nm (Hg linija), dok disperzija iznosi $9.2\text{ cm}^{-1}/\text{mm}$ na 514.5 nm (0.243 nm/mm).



Slika 2.4. Šematski prikaz uređaja za snimanje ramanskih spektara.

Detektorski sistem u opisanom uređaju za ramansku spektroskopiju čine RCA-C31034A fotomultiplikator sa kućištem, koji se hlađi Peltier-ovim elementom, pojačavački i brojački uredjaji. Kvantna efikasnost GaAs fotokatode je 25 %, uz skoro

linearnu spektralnu osetljivost u opsegu od 400-800 nm. Parametar, na koji treba posebno obratiti pažnju, je tzv. *struja mraka*, tj. signal dobijen na detektoru bez upadnog snopa. Struja mraka praktično predstavlja minimalan intenzitet signala, koji može biti detektovan fotomultiplikatorom. Glavni izvor ove struje je termalna emisija, koja u slučaju GaAs iznosi 10000 odbroja/s na temperaturi od 293 K i 10 odbroja/s na temperaturi od 253 K. Zbog toga je neophodno korišćenje Peltier-ovog elementa da bi se povećala osetljivost detektorskog sistema.



Slika 2.5. Detaljni šematski prikaz uredjaja za ramansku spektroskopiju u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku.

Merenja opisana u ovom radu izvršena su u konfiguraciji koja je detaljno prikazana na Slici 2.5. Ovo je tzv. geometrija unazad (*backscattering*)¹². Laserski snop

¹² U pravoj geometriji rasejanja unazad upadni i rasejani zrak treba da se prostiru suprotnim smerovima istog pravca.

je fokusiran cilindričnim ili sabirnim sočivom na samu površinu uzorka, pod što je moguće manjim uglom u odnosu na normalu na uzorak. Elastični deo rasejane svetlosti nije od interesa za ova merenja, već samo *neelastični deo*, koji se, kao što je napomenuto, objektivom kolimiše na ulazni prorez monohromatora, gdje se spektralno razlaže, a potom detektuje na detektoru. Finalni spektar registruje se na računaru koji se koristi i za vodjenje celog eksperimenta.

Opisani uređaj za ramansku spektroskopiju snabdeven je Leybold kriostatom sa zatvorenim helijumskim sistemom hlađenja, koji omogućava merenje ramanskih spektara na niskim temperaturama (do 10K).

Osim ramanskih, na ovom uređaju i u istoj konfiguraciji, izvršena su i merenja fotoluminescencije (Poglavlje 3.), s tim što su zbog velike širine fotoluminescentnih modova ova merenja vršena u mnogo većem opsegu učestanosti i sa znatno manjom rezolucijom nego ramanska.

2.3. Modelovanje ramanskih spektara nanomaterijala

Za razliku od kristalnih materijala, fononi u nanostrukturama su po pravilu ograničeni i moguće ih je detektovati pomoću ramanske spektroskopije, kako optičke fonone, tako i akustičke. Pri tome treba imati u vidu da akustički fononi u monokristalima ne mogu biti registrovani u ramanskim spektrima, jer se usled vrlo niske učestanosti nalaze isuviše blizu laserskoj liniji, pa ih zaklanja intenzivno Rayleigh-evo rasejanje. Međutim, oni se pojavljuju u ramanskom spektru nanostruktura tj. niskodimenzionih sistema (u regionu $<100\text{ cm}^{-1}$), usled tzv. *efekta presavijanja BZ*¹³ [73]. Za modelovanje fonona aktivnih u ramanskom spektru nanomaterijala koriste se dva modela, pomoću kojih je moguće odrediti dimenzije nanočestica. *Model elastične sfere* opisuje slobodne oscilacije homogene sfere i pogodan je za modelovanje niskofrekventnih ramanskih modova koji nastaju usled aktiviranja akustičkih fonona u niskodimenzionom materijalu [73]. Drugi model, tzv. *model fononskog ograničenja*¹⁴, pogodan je za opisivanje pomeranja i asimetričnog širenja ramanskih modova usled ograničavanja optičkih

¹³ Manje dimenzije nanostrukture dovode do pomeranja akustičkih modova ka višim učestanostima.

¹⁴ *Phonon confinement model* (PCM).

fonona unutar nanosfera malog prečnika L [73, 85]. U ovom radu biće detaljno razmatrano modelovanje optičkih fonona u ramanskom spektru nanomaterijala primenom ovog modela.

U procesu nastanka ili nestanka optičkog fonona usled interakcije sa spoljašnjim zračenjem, u ramanskom spektru prvog reda u *beskonačnom* kristalu učestvuju samo oni optički fononi sa vrednošću talasnog vektora $\vec{q} \approx 0$, odnosno fononi iz neposredne blizine centra Brillouin-ove zone (dalje u tekstu - BZ)¹⁵. Usled neuređenosti u kristalima, u smislu amorfnosti ili smanjene dimenzije sistema, u optičkim procesima se modifikuju selekciona pravila za talasni vektor. U *amorfnom materijalu*, usled nepostojanja dugodometnog uređenja, selekciona pravila, koja se inače primenjuju na \vec{q} više ne važe, tako da će struktura ramanskog spektra praktično podsećati na gustinu fononskih stanja, pa se nanokristalni materijal može posmatrati kao stanje između beskonačnog kristala i amorfног materijala [1]. Uopšteno posmatrano, u slučaju nanodimenzionog materijala, čije dimenzije su uporedive sa talasnom dužinom fonona, ekscitacije elementarne ćelije kristala više se ne mogu opisivati ravanskim talasima. Talasni paket sa prostornom dimenzijom uporedivom sa veličinom kristalita dovodi do uključivanja fonona sa talasnim brojem znatno različitim od nule u proces ramanskog rasejanja. Tako sa smanjivanjem realne dimenzije materijala talasni paket postaje više lokalizovan u stvarnom prostoru. Prepostavlja se da smanjivanje dimenzije uređenog domena materijala značajno utiče na selekciona pravila, ali ne menja značajno disperzione krive odgovarajućeg 3D kristalnog sistema [86].

Osnovni pristup koji se primenjuje u modelu fononskog ograničenja oslanja se na rad Richtera sa saradnicima [87]. Oni ukazuju da selekciona pravila održanja momenta fonona, koja važe u savršenom kristalu, prestaju da važe, pa se fononska talasna funkcija u beskonačnom kristalu zamenjuje odgovarajućom funkcijom, koja opisuje fonon ograničen u maloj zapremini kristalita. Ova lokalizacija uvodi se u model primenom Gauss-ove funkcije ograničenja. Campbell i Fauchet [88] kasnije proširuju

¹⁵ U procesu ramanskog rasejanja u kristalnim materijalima važi zakon održanja energije i talasnog vektora \vec{k} . Vrednost talasnog vektora fotona $k = 2\pi/\lambda$ veoma je mala u poređenju sa fononskim talasnim vektorom $k=2\pi/a$, gde je λ talasna dužina fotona, a a parametar rešetke. Budući da dva fotona i jedan fonon učestvuju u procesu rasejanja, vrednost talasnog vektora emitovanog fonona, kao suma talasnih vektora fotona, takođe veoma mala. To znači da samo fononi sa $q \approx 0$ učestvuju u procesu ramanskog rasejanja [78]. Isto važi i za Brillouin-ovo rasejanje.

ovaj model korišćenjem i drugih funkcija ograničenja i razmatranjem različitih oblika nanokristalita (sfera, žica ili tanak film), zadržavajući kao osnovu Gauss-ovu funkciju, sličnu onoj koju su koristili Richter i saradnici, kao posebno pogodnu za nanostrukturne poluprovodnike, ali sa manjom amplitudom na granicama BZ.

2.3.1. Model fononskog ograničenja (MFO)

U idealnom beskonačnom kristalu fonon sa talasnim vektorom \vec{q}_0 opisuje se ravanskim talasom [87, 88]:

$$\Phi(\vec{q}_0, \vec{r}) = u(\vec{q}_0, \vec{r}) \cdot \exp(-i\vec{q}_0 / \vec{r}). \quad (2.17)$$

Ukoliko smatramo da je fonon ograničen Gauss-ovom funkcijom $W(\vec{r}, L)$ unutar sfere prečnika L , fononska talasna funkcija imaće oblik:

$$\begin{aligned} \Psi(\vec{q}_0, \vec{r}) &= W(\vec{r}, d) \cdot \Phi(\vec{q}_0, \vec{r}) = u(\vec{q}_0, \vec{r}) \cdot \Psi'(\vec{q}_0, \vec{r}), \\ \Psi'(\vec{q}_0, \vec{r}) &= W(\vec{r}, d) \cdot \exp(-i\vec{q}_0 / \vec{r}) \end{aligned} \quad (2.18)$$

gde su: $W(\vec{r}, d)$ - težinska funkcija, a $u(\vec{q}_0, \vec{r})$ periodična funkcija sa periodom rešetke.

Da bi se odredio uticaj fononskog ograničenja na ramanski spektar, funkcija Ψ' predstavlja se kao superpozicija svojstvenih funkcija talasnog vektora \vec{q} u okolini centra BZ sa Fourier-ovim koeficijentima kao težinskim faktorima:

$$\Psi'(\vec{q}_0, \vec{r}) = \int d^3\vec{q} \cdot C(\vec{q}_0, \vec{q}) \cdot \exp(i\vec{q}\vec{r}), \quad (2.19)$$

gde su Furier-ovi koeficijenti dati kao

$$C(\vec{q}_0, \vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\vec{r} \cdot \Psi'(\vec{q}_0, \vec{r}) \cdot \exp(i\vec{q}\vec{r}). \quad (2.20)$$

Fononska talasna funkcija u mikrokristalu je superpozicija svojstvenih funkcija sa vektorima \vec{q} centriranim oko \vec{q}_0 . Da bi se experimentalni rezultati kvalitetno interpretirali, potrebno je pravilno odabratи funkciju ograničenja. Campbell i Fauchet [88] su predložili težinske funkcije, kao osnovu kvalitativnog pristupa pri opisivanju evolucije ramanskog moda sa smanjenjem veličine nanočestice (Tabela 2.1). Neuniformna raspodela dimenzija čestice ili nesavršenost kristalita, o čemu će više reći biti kasnije, takođe mogu da dovedu do dodatnog ograničavanja fonona usled uticaja granica ovih mikrodomena ili samih defekata [1].

Kao što je ranije rečeno, usled nedostatka dugodometnog uređenja u nanomaterijalima, optički fononi izvan centra BZ, koji su određeni disperzionom relacijom $\omega(\vec{q})$, sa vrednostima talasnog vektorima $\vec{q} \neq 0$ (pri čemu je $\Delta\vec{q} \approx 1/L$), takođe učestvuju u procesu ramanskog rasejanja prvog reda [1, 73, 89]. Uticaj ovih fonona povećava se kako se smanjuje veličina čestice nanokristala, dovodeći do asimetričnog širenja i pomeranja ramanskog moda u zavisnosti od nagiba fononske disperzije krive, o čemu će kasnije biti više reči. U skladu sa Richter-ovom, odnosno Campbell-ovom fenomenološkom teorijom [87, 88], rezultujući ramanski intenzitet za sfernu česticu prečnika L i Gauss-ovom funkcijom ograničenja $|C(0, \vec{q})|^2 = \exp(-q^2 L^2 / 8\beta)$, predstavlja se kao superpozicija lorencijana¹⁶ centriranih u $\omega(q)$ u celoj BZ [87, 88]. U slučaju konačnog kristala, ramanski intenzitet predstavljen je trostrukim integralom po BZ:

$$I(\omega) \propto \sum_{i=1}^m \int_{BZ} \frac{\exp\left(-\frac{q^2 L^2}{8\beta}\right) d^3 q}{(\omega - \omega_i(q))^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}, \quad (2.21)$$

gde su: q talasni vektor izražen u jedinicama $2\pi/a$ (a je parametar kristalne rešetke u odgovarajućem pravcu), L - dimenzija čestice, β - jačina fononskog ograničenja, $\omega_i(q)$ - fononske disperzije funkcije (u skladu sa stepenom degeneracije ramanskog moda, gde je $\omega_i(0) = \omega_0$ za $i=1, m$), Γ - prirodna širina ramanske linije monokristala materijala¹⁷. U slučaju beskonačnog kristala ($L \rightarrow \infty$), intenzitet ramanskog moda $I(\omega)$ praktično predstavlja lorencijan centriran na ramanskoj učestanosti ω_0 sa širinom Γ_0 .

Jednačina (2.21) predstavlja osnovnu jednačinu modela fononskog ograničenja (MFO), koja uključuje uticaj dimenzije nanočestice u zavisnosti od fononske disperzije i graničnih uslova u različitim nanomaterijalima. U narednim poglavljima biće prikazana detaljna analiza uticaja ovih parametara MFO na položaj, širinu i oblik modelovanog ramanskog spektra nanomaterijala. Pored toga, MFO će biti proširen na modelovanje

¹⁶ Uobičajeno je da se ramanski modovi opisuju jednim lorencijanom, koji je dat u sledećem obliku: $I(\omega) = I_0 + \frac{A}{2\pi} \frac{\Gamma_0}{(\omega - \omega_0)^2 + (\Gamma_0/2)^2}$, gde je I intenzitet ramanskog moda, a I_0 , A , ω_0 i Γ_0 parametri koji

se podešavaju i odgovaraju pomeraju po y -osi, površini, centru i poluširini ramanskog pika, redom [78].

¹⁷ Širina moda na polovini visine – *full width at half maximum* (FWHM).

uticaja distribucije dimenzija nanočestica, naprezanja u nanomaterijalu i anharmonijskog efekta usled promene temeprature. Sve ove analize biće sprovedene na primerima ramanskih modova konkretnih materijala, i to E_g moda anatas TiO_2 i F_{2g} moda CeO_2 nanoprahova. Iako su primeri modelovanja u narednim poglavljima izabrani tako da najbolje ilustruju pojedine efekte u MFO, zaključci koji slede iz njihove analize u opštem slučaju su primenljivi na široku klasu nanomaterijala.

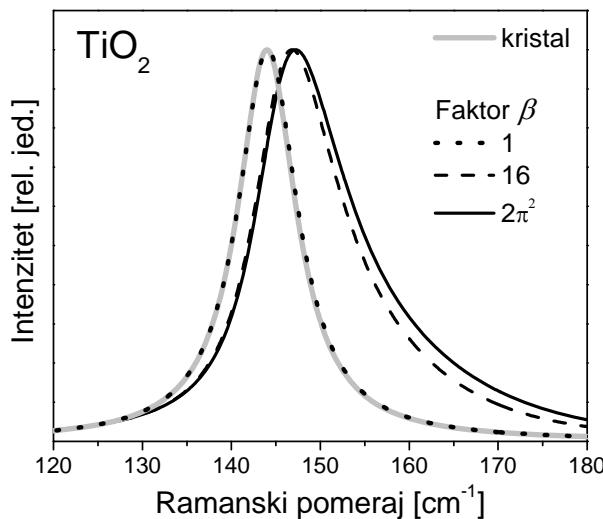
Tabela 2.1. Pregled težinskih funkcija i koeficijenata u fononskom ograničenju (videti jednačine (2.12-2.15), kao i ref. [87, 88]).

<i>Analogija</i>	<i>Težinska funkcija</i>	<i>Fourier-ov koeficijent</i>	<i>Težinski koeficijent</i>
<i>Osnovno stanje elektrona u čvrstoj sferi</i>	$\sin(\alpha r)/\alpha r$	$\frac{\sin^2(qL/2)}{(4\pi^2 - q^2 L^2)^2}$	$\frac{\sin(2\pi r/L)}{2\pi r/L}$
<i>Talasi u sredini sa gubicima</i>	$\exp(-\alpha r)$	$\frac{1}{(16\pi^4 - q^2 L^2)^4}$	$\exp(-4\pi^2 r/L)$
<i>Distribucija mnogo malih kristala</i>	$\exp(-\alpha r/L^2)$	$\exp(-q^2 L^2/16\pi^2)$	$\exp(-8\pi^2 r^2/L^2)$

2.3.1.1. Jačina i dimenzija fononskog ograničenja u MFO

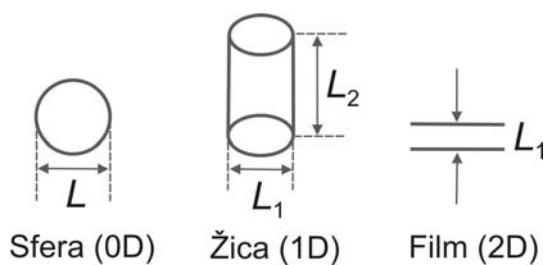
Jačina fononskog ograničenja (β) odgovorna je za vrednost amplitude fonona na granicama BZ i uzima različite vrednosti u skladu sa graničnim uslovima u različitim nanomaterijalima. Karakteristične vrednosti, poznate iz literature, su $\beta=1$ u Richter-ovom [87] i $\beta=2\pi^2$ u Campbell-ovom MFO [88]. Veća vrednost faktora β dovodi do većeg pomeranja i asimetričnog širenja ramanskog moda u odnosu na položaj i širinu ovog moda u kristalnom materijalu, kao što je prikazano na Slici 2.6. Pri tome Ramanski mod dobijen pomoću Richter-ovog fononskog ograničenja ($\beta=1$) veoma malo odstupa od ramanskog moda u kristalnom materijalu. U ovom primeru modelovan je najintenzivniji E_g ramanski mod u anatas nanoprahu, korišćenjem jednačine (2.21). Uz prepostavku isotropne i sfernosimetrične BZ, integracija u navedenoj jednačini vršena je samo po gornjoj disperzionoj grani iz pravca Γ -X (videti BZ anatas TiO_2 u Poglavlju 1.1.1.), koja je modelovana kosinusnom funkcijom ($\omega = 144 + 102 \cdot (1 - \cos qa)$, gde je a

parametar kristalne rešetke). Izabrane su dimenzija nanočestice $L_0=12\text{ nm}$ i širina $\Gamma=8\text{ nm}$.



Slika 2.6. Prikaz zavisnosti položaja i poluširine ramanskog E_g moda u anatas TiO_2 , dobijenog primenom MFO, od jačine fononskog ograničenja β .

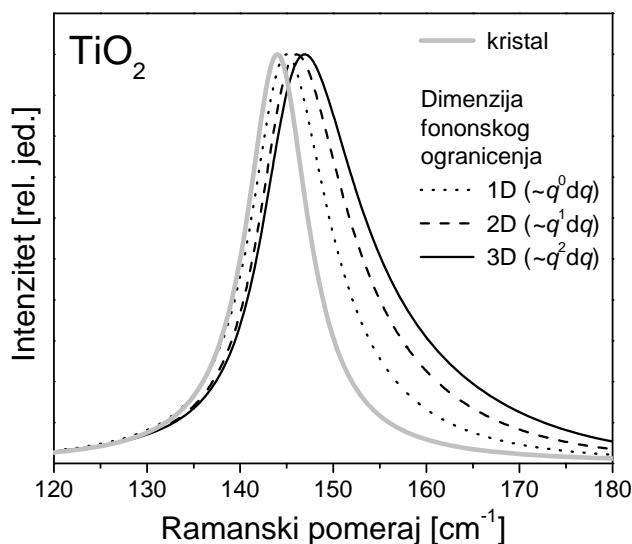
Na Slici 2.7. ilustrovani su primeri dimenzija realnih objekata (materijala) - kvantna tačka (sfera), žica i film, sa odgovarajućim dimenzijama u realnom prostoru. Na nanomaterijale ovih dimenzija može se primeniti MFO sa različitom *dimenzijom fononskog ograničenja*.



Slika 2.7. Grafički prikaz 0D, 1D i 2D materijala [88].

Kako je kod modelovanja ramanskih spektara uobičajeno da se proračun izvodi u sfernom koordinatnom sistemu, moguće je lako manipulisati i dimenzijom ograničenja modela [85, 87, 90]. Kada se modeluju ramanski spektri izolovanih ili slabo

povezanih nanočestica (nanoprahova) i kvantnih tačaka, odnosno nula-dimenzionalnih (0D) sistema u realnom prostoru, uzima se u obzir 3D MFO, u kome se zapreminska element u integralu u jednačini (2.21) uzima u obliku $d^3q \propto q^2 dq$. Kod kvantnih žica (1D objekata) koristi se 2D fononski ograničenja, u obliku $d^3q \propto q dq$. I na kraju, za vrlo tanke slojeve (filmmove) i kvantne jame, odnosno 2D materijale, koristi se 1D fononsko ograničenje, koji se u integralu predstavlja elementom $d^3q \propto dq$.



Slika 2.8. Prikaz zavisnosti položaja i poluširine ramanskog spektra najintenzivnijeg anatas $\text{TiO}_2 E_g$ moda od dimenzije MFO.

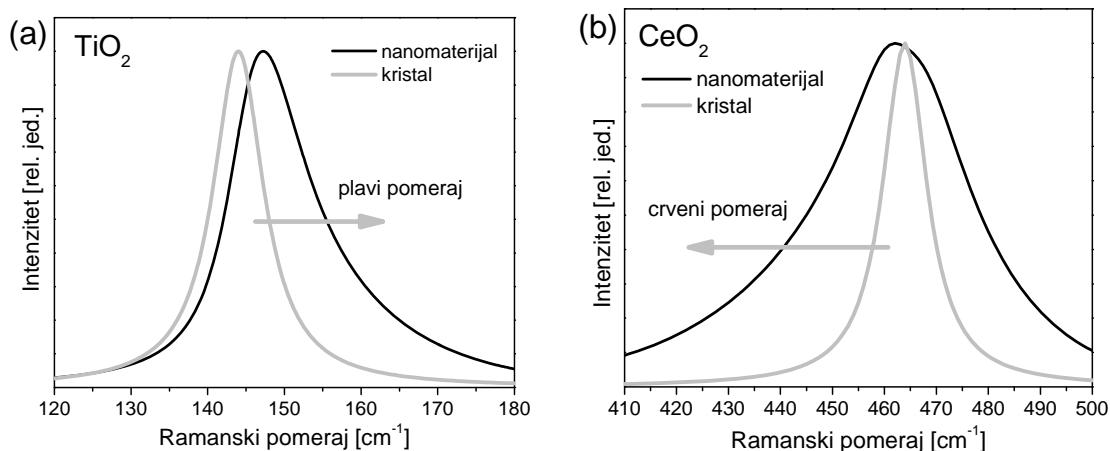
Uticaj dimenzionalnosti MFO na položaj, širinu i oblik ramanskog moda kod nanomaterijala prikazan je na Slici 2.8, takođe na primeru najintenzivnijeg E_g ramanskog moda kod anatas TiO_2 nanopraha, sa istim parametrima kao u prethodnom primeru (Slika 2.6), uz Campbell-ov faktor ograničenja ($\beta=2\pi^2$). Kao što je i očekivano, sa povećanjem dimenzije fononskog ograničenja dolazi do većeg pomeranja i asimetričnog širenja ramanskog moda u odnosu na mod u kristalnom materijalu.

Na osnovu rezultata prikazanih na Slikama 2.6 i 2.8 može se zaključiti da smanjenje faktora ograničenja β ima sličan uticaj kao i smanjenje dimenzije ograničenja. Zbog toga su neki autori dobili dobro slaganje računatih sa eksperimentalnim rezultatima kod anatas TiO_2 nanočestica primenom Campbell-ovog faktora ograničenja $\beta=2\pi^2$, tako što su koristili 1D MFO [90], što nije sasvim

odgovarajuće pretpostavaka, imajući u vidu realne dimenzije materijala. Dakle, kako promene različitih parametara (dimenzije i jačine fononskog ograničenja) mogu dovesti do sličnih efekata, treba uvek imati u vidu fizičke karakteristike nanomaterijala, čiji se ramanski spektri modeluju, što će biti pokazano i u narednim poglavljima.

2.3.1.2. Uloga fononske disperzije u MFO

Kao što je već rečeno, uticaj fonona izvan centra BZ kod nanomaterijala uzima se u obzir preko disperzionih relacija duž glavnih pravaca visoke simetrije unutar BZ i ogleda se, pre svega, u smeru pomeranja ramanskog moda u odnosu na njegov položaj u kristalu. U slučaju pozitivnog nagiba disperzije krive, MFO predviđa pomeranje ramanskog moda ka višim učestanostima (tzv. plavi pomeraj, *blueshift*), dok se u slučaju negativnog nagiba disperzije predviđa pomeranje ka nižim učestanostima (crveni pomeraj, *redshift*). Na Slici 2.9. prikazan je uticaj nagiba fononskih disperzionih krivih na pomeranje i asimetrično širenje ramanskih modova kod anatas TiO_2 i CeO_2 nanoprahova, dobijen primenom MFO (2.21).



Slika 2.9. Prikaz uticaja fononske disperzije na smer pomeranja i asimetričnog širenja ramanskog moda dobijen primenom MFO za: (a) anatas $\text{TiO}_2 E_g$ mod ($L_0=12$ nm, $\Gamma=8$ nm, $\beta=2\pi^2$, $\omega_0=144\text{cm}^{-1}$, Γ -X pravac) i (b) $\text{CeO}_2 F_{2g}$ mod ($L_0=6$ nm, $\Gamma=10$ nm, $\beta=2\pi^2$, $\omega_0=464\text{ cm}^{-1}$, Γ -X pravac).

Pored nagiba disperzije funkcije, na veličinu pomeraja i asimetričnog širenja ramanskog moda može značajno da utiče i izbor simetrijskih pravaca u BZ i

disperzionih grana u slučaju degenerisanih modova, kao i sam oblik disperzionih grana. Veliki uticaj može da ima oblik BZ, tako da treba razmotriti opravdanost najčešće korišćene aproksimacije pri modelovanju fononskog ograničenja, gde se BZ najčešće posmatra kao sferna i izotropna. Zbog toga će ovde biti posvećena posebna pažnja uticaju parametara povezanih sa fononskom disperzijom na modelovanje ramanskog spektra.

U slučaju većine nanomaterijala, sam oblik fononske disperzije dovodi se u pitanje, pre svega zato što često ni za kristalne materijale u ovoj oblasti ne postoje relevantni eksperimentalni rezultati neelastičnog neutronskog rasejanja. Pri tome treba imati u vidu da su uticaj dimenzija nanočestica na fononske disperzione funkcije i njihova temperaturska zavisnost za sada sasvim neistraženo područje, sa mnogo aproksimacija, čak veoma proizvoljnih, kako će se jasno pokazati u primerima koji slede. Problemom disperzionih relacija bavio se veći broj autora. Predložene su različite mogućnosti za modeliranje fononskih disperzionih funkcija kod nanomaterijala. U slučaju TiO₂, većina autora se slaže u izboru periodične (kosinusne ili sinusne) funkcije [89-92], dok je u slučaju CeO₂ uobičajeno korišćenje polinomske disperzione relacije [50, 93, 94]. Broj i raznolikost do sada publikovanih modela, posebno kada je u pitanju anatas TiO₂, svoj uzrok ima, pre svega, u nedostatku eksperimentalnih podataka za fononsku disperziju, pa će ovde biti prikazan uticaj disperzionih relacija na MFO upravo na primeru anatas TiO₂ nanopraha.

Iz potrebe da se sledi periodičnost, koja je svojstvena kristalnim strukturama, disperzione relacije najčešće se modeliraju kosinusnim, odnosno sinusnim funkcijama. Tako Zhu i sardnici [92] koriste aproksimaciju sferne i izotropne BZ prečnika $2\pi/a$, gde je a parametar kristalne rešetke anatas TiO₂, uz jednostavan model za fononske disperzije, zasnovan na teorijskim fononskim disperzijama, koje daju Mikami i saradnici¹⁸ [5]. Ove disperzione relacije u Δ oblasti BZ (grane Γ -X), s obzirom na dvostruku degeneraciju ramanskog E_g moda, imaju sledeći oblik:

$$\omega_i(q) = A_i + B_i \cdot [1 - \cos(q \cdot a)], \quad (2.22)$$

¹⁸ Koliko je poznato, teorijski rezultati koje su dali Mikami i saradnici [5] do su sada jedini izvor informacija o fononskim disperzijama anatas TiO₂ monokristala.

gde su odgovarajući parametri za gornju granu disperzije $B_1=102 \text{ cm}^{-1}$, za donju $B_2=28 \text{ cm}^{-1}$, dok $A_1=A_2=143 \text{ cm}^{-1}$ odgovara učestanosti ramanskog E_g moda u centru BZ $\omega_{q=0}$, na sobnoj temperaturi.

Bersani sa saradnicima [91] koristi iste aproksimacije, ali podatke o disperzionim relacijama preuzima iz eksperimentalnih podataka za srodnu modifikaciju TiO_2 , rutil, za koji postoje eksperimentalni podaci dobijeni neelastičnim neutronskim rasejanjem [95], koristeći pri tome identičnu funkciju kao Zhu i saradnici (2.22), za samo jednu disperzionu funkciju (ne uzimajući u obzir degeneraciju moda), sa parametrima $A=144 \text{ cm}^{-1}$, $B=20 \text{ cm}^{-1}$.

Ivanda i saradnici [89], takođe na osnovu pretpostavljene sličnosti između disperzija ramanskog E_g moda kod anatas i moda B_{1g} kod rutil TiO_2 (na $\sim 143 \text{ cm}^{-1}$ [23, 95]), kao aproksimaciju za fononsku disperziju za anatas koriste disperziju kristala rutila duž pravaca Γ -X (ili Γ -M) [95], modeliranu sinusnom funkcijom, na sledeći način:

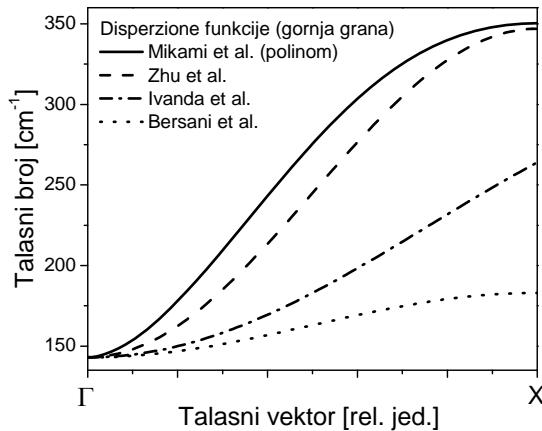
$$\omega(q) = A + B \sin^2(q\pi/x), \quad (2.23)$$

gde $A=143.5 \text{ cm}^{-1}$ određuje učestanost fonona u centru BZ, a $B=164 \text{ cm}^{-1}$ definiše veličinu disperzije (parametar $x=1.51779$). Talasni broj q takođe je izražen u jedinicama $2\pi/a$.

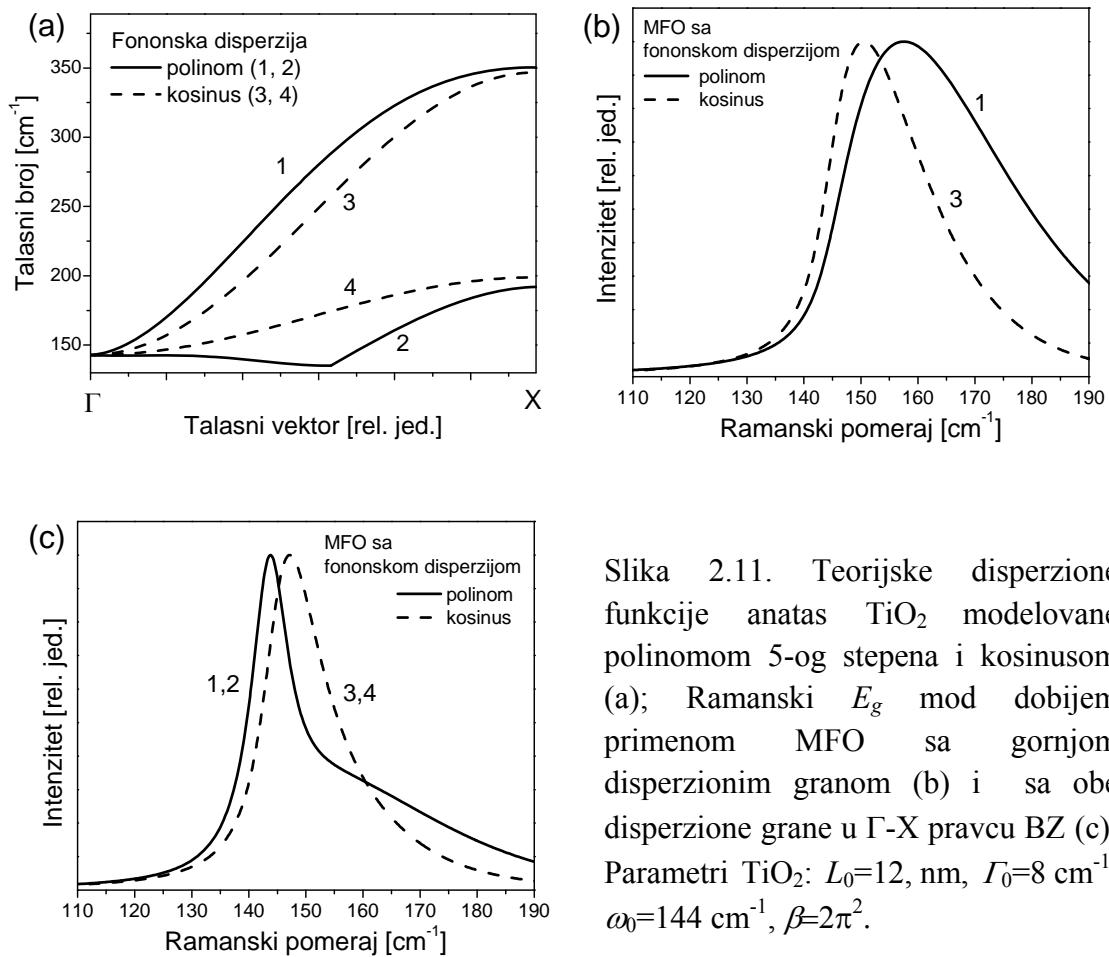
Na Slici 2.10. prikazane su disperzione funkcije navedenih autora za gornju disperzionu granu u Γ -X pravcu BZ anatas TiO_2 . Očigledno je da se ove disperzione funkcije preklapaju samo neposredno oko centra BZ i da će, kako raste udaljenost od centra, i uticaj disperzionih funkcija biti veoma različit. Radi ilustracije, punom linijom je prikazana teorijska disperziona zavisnost [5], modelirana polinomom petog reda u obliku datom jednačinom:

$$\omega(q) = A + B_1 q + B_2 q^2 + \dots + B_5 q^5, \quad (2.24)$$

gde su parametri A i B_i birani tako da, što je moguće tačnije, reprodukuju odgovarajuću krivu Γ -X, prikazanu u Poglavlju 1.1.1. U slučaju TiO_2 , parametri kosinusne disperzione relacije (2.22) izabrani su na uobičajeni način, tako da najpribližnije prate početak i kraj teorijskih disperzionih funkcija, koje predlažu Mikami et al. [5, 92]. Iako postoji izvesno odstupanje kosinusne funkcije, koju daju Zhu i saradnici, od polinomske teorijske krive (Slika 2.10.), ono je posebno izraženo kod disperzionih relacija koje predlažu Bersani i Ivanda i iznosi i preko 100 cm^{-1} .



Slika 2.10. Poređenje fononskih disperzionalnih relacija raznih autora za gornju granu u pravcu G-X kod anatas TiO_2 monokristala.



Slika 2.11. Teorijske disperzionalne funkcije anatas TiO_2 modelovane polinomom 5-og stepena i kosinusom (a); Ramanski E_g mod dobijem primenom MFO sa gornjom disperzionalnom granom (b) i sa obe disperzionalne grane u Γ -X pravcu BZ (c); Parametri TiO_2 : $L_0=12$, nm, $\Gamma_0=8 \text{ cm}^{-1}$, $\omega_0=144 \text{ cm}^{-1}$, $\beta=2\pi^2$.

Budući da kod nanomaterijala uticaj fonona izvan centra BZ nije zanemariv, jasno je da će se razlike javiti i između konačnih rezultata MFO sa kosinusom i polinomskom disperzijom. Na Slici 2.11(b) prikazani su spektri ramanskog E_g moda

anatas TiO₂ dobijeni uz prepostavku sferne i izotropne BZ, prema jednačini (2.21) integracijom po gornjoj disperzionaloj grani u Γ -X pravcu BZ u polinomskom obliku (kriva "1" na Slici 2.11(a)) i kosinusnom obliku (kriva "3" na istoj slici). Na Slici 2.11(c) dati su modelovani spektri istog moda, dobijeni integracijom po obe disperzionalne grane u Γ -X pravcu BZ, u polinomskom obliku (krive "1" i "2" na Slici 2.11(a)) i kosinusnom obliku (krive "3" i "4" na istoj slici).

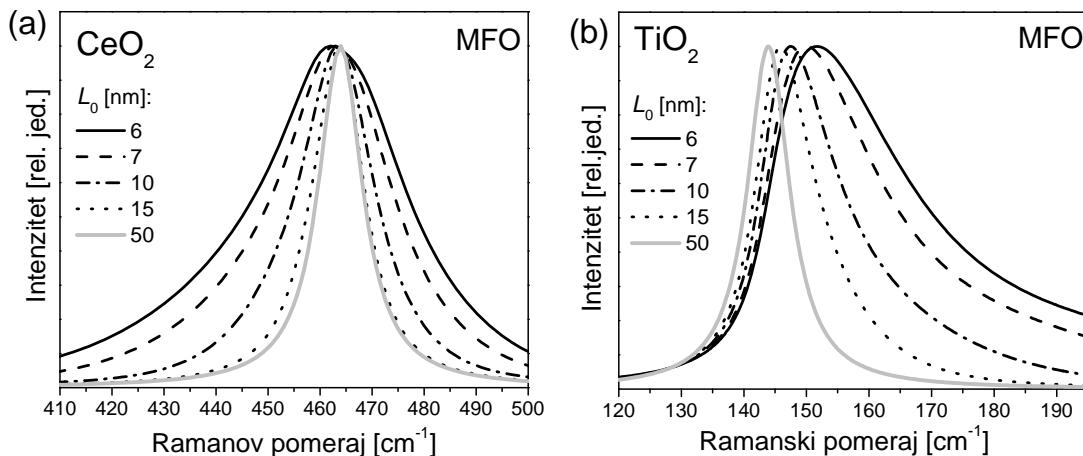
Kao što se vidi sa Slike 2.11, disperzionale relacije unose različit pomeraj i širenje u ramanski spektar pri istoj vrednosti jačine ograničenja ($\beta=2\pi^2$), pre svega usled različitih nagiba fononskih disperzionalih krivih. Osim toga, promena nagiba polinomske disperzionale relacije, označene brojem "2" na Slici 2.11(a), unosi deformaciju u modelovani ramanski spektar (kriva "1,2" na Slici 2.11(c)), koja nije u skladu sa oblikom eksperimentalnog spektra, o čemu će kasnije biti reči. Uvođenjem integracije po drugim pravcima visoke simetrije u BZ, može doći do dodatnog usložnjavanja oblika ramanskog spektra i smanjivanja opsega u kome bi taj model bio primenljiv. Zbog toga se u slučaju anatas TiO₂, većina autora odlučuje za model periodične funkcije, sa većom ili manjom preciznošću [89-92], iako polinomska funkcija mnogo vernije reprodukuje teorijske disperzionale krive nego kosinusna. Nasuprot tome, kada postoji eksperimentalne fononske disperzije, kao na primer kod CeO₂, autori se radije odlučuju za polinomske modele, koji vernije reprodukuju izmerene zavisnosti [50, 55, 93, 94].

Pored ovih nepreciznosti u modelovanju disperzionalih relacija, oblik i anizotropija BZ takođe predstavljaju problem za sebe, koji različiti autori rešavaju na različite načine. Kada su u pitanju nanomaterijali, pretpostavke o sferičnosti i izotropnosti BZ, koje su najčešće u modelovanju ramanskih spektara različitih materijala, mogu se opravdano dovesti u pitanje. Pri tome, naravno, treba imati u vidu i oblik i simetriju jedinične celije odnosno BZ kod konkretnog materijala. Kod CeO₂ se praktično može zadržati sferičan oblik BZ, bez većeg ugrožavanja ispravnosti modela, budući da kristalna rešetka ima kubičnu simetriju. Međutim, kod TiO₂, zbog tetragonalne primitivne celije, u postupku modelovanja fononskih disperzionalih funkcija, odnosno samog ramanskog spektra, mora se uzeti u obzir oblik BZ. Zbog toga će u Poglavlju 2.4.1.1 biti analizirani doprinosi pojedinih simetrijskih pravaca i disperzionalnih grana u BZ anatas TiO₂ i njihov uticaj na modelovanje ramanskog E_g moda.

2.3.1.3. Modelovanje raspodele dimenzija nanočestica u MFO

Uticaj veličine nanočestice na položaj i širinu ramanskog moda već je dobro poznat i eksperimentalno utvrđen fenomen, u kome sa smanjivanjem čestice dolazi do pomeranja i asimetričnog širenja ramanskog moda, u skladu sa oblikom fononske disperzije.

Fenomenološki MFO (jednačina (2.21)) ima veliki uspeh u objašnjavanju oblika i položaja ramanskog moda kod nanokristalnih materijala. Na Slici 2.12(a) prikazan je primer zavisnosti položaja i poluširine ramanskog F_{2g} moda kod CeO_2 , kao ilustracija pomeranja učestanosti i asimetričnog širenja ka manjim učestanostima sa smanjenjem dimenzije nanočestice. Na Slici 2.12(b) vidi se da se, kada se nanočestice smanjuju, učestanost najintenzivnijeg E_g moda u anatas TiO_2 povećava i mod asimetrično širi ka višim učestanostima.



Slika 2.12. Prikaz zavisnosti položaja i poluširine ramanskog moda od dimenzije nanočestice L_0 računat pomoću MFO: F_{2g} mod u CeO_2 , (a) i E_g mod u TiO_2 . Položaji i širine ovih modova CeO_2 i TiO_2 za L_0 od 6 i 50 nm dati su u Tabeli 2.2.

U slučaju anatas TiO_2 , odabrane su dve disperzione grane sa pozitivnim nagibom iz Γ -X pravca BZ (videti prethodno poglavlje), koje usled jedinstvenog nagiba sa smanjenjem čestice izazivaju veliki plavi pomeraj ramanskog E_g moda u odnosu na kristal. Kod CeO_2 su u izračunavanju korišćena 3 disperziona pravca BZ (Δ , Λ , Σ), pa usled različitih

nagiba (videti Poglavlje 1.2.1) disperzionih funkcija praktično dolazi do kompenzacije pomeranja ovog moda. U oba primera korišćen je Campbell-ov faktor ograničenja $\beta=2\pi^2$ [88]. Učestanosti i širine ramanskih spektara računatih primenom MFO, prikazanih na Slikama 2.12 i 2.13, date su u Tabeli 2.2, zajedno sa podacima za odgovarajuće kristalne materijale.

Tabela 2.2. Pregled karakteristika ramanskog F_{2g} moda CeO_2 i E_g moda anatas TiO_2 u MFO sa uniformnom nanočesticom i nehomogenom distribucijom nanočestice.

	L_0	Model	$\omega [\text{cm}^{-1}]$	$\Gamma [\text{cm}^{-1}]$
CeO_2 (F_{2g})	kristal ($\geq 50 \text{ nm}$)	MFO MFO + distribucija nanočestice	464	10
	6 nm		462	33
	6 nm ($w=0.50L_0$)		462	40
TiO_2 (E_g)	kristal ($\geq 50 \text{ nm}$)	MFO MFO + distribucija nanočestice	144	8
	6 nm		152	27
	6 nm ($w = 0.50L_0$)		152.5	35

Do sada u MFO nije uzimana u obzir raspodela dimenzija nanočestica. Različiti uslovi sinteze, a i sama priroda nanokristalnih sistema, sugerisu nužnost uključivanja heterogenosti i neuređenosti uzorka u ovaj model. Različite metode, kao što su transmisiona elektronska mikroskopija (TEM), skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), mikroskopija na bazi medjuatomskih sila (AFM¹⁹) i slično, daju mogućnost da se veoma precizno detektuju različita svojstva nanostruktura, a posebno nehomogenost veličine nanočestice. Dakle, asimetrija ramanskog moda može da proistekne, ne samo iz fononskog ograničenja usled učešća fonona iz cele BZ u ramanskom rasejanju, već i iz raspodele dimenzije nanočestice. Zbog toga je osnovna jednačina MFO (2.21) modifikovana, kako bi uključila uticaj raspodele dimenzija nanočestica na sledeći način [96]:

$$I(\omega) \propto \sum_{i=1}^m \int_0^\infty \rho(L) dL \int_{BZ} \frac{\exp\left(-\frac{q^2 L^2}{8\beta}\right) d^3 q}{(\omega - \omega_i(q))^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}, \quad (2.25)$$

¹⁹ Atomic force microscopy.

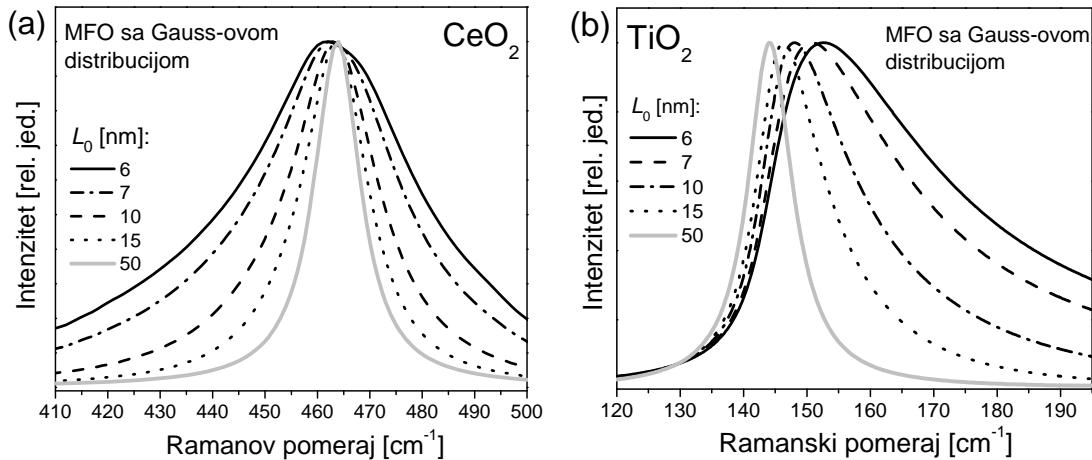
gde su: $\rho(L)$ - distribucija dimenzije čestica, dok su ostali parametri definisani kao u jednačini (2.21).

Najjednostavnija i u modelovanju najčešće korišćena distribucija nanočestica je *Gauss-ova* [50, 97, 98]. Pod pretpostavkom sferne nanočestice, funkcija raspodele nanočestice $\rho(L)$ u integralu (2.25) uzima oblik Gauss-ove (ili normalne) statističke distribucije u obliku [50, 96, 99]:

$$\rho(L) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(L-L_0)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (2.26)$$

gde je L_0 centralna vrednost raspodele, a σ njena standardna devijacija. Na primerima TiO_2 i CeO_2 nanoprahova ovde će biti prikazan uticaj srednje veličine nanokristalita i standardne devijacije Gauss-ove raspodele na položaj i asimetriju odgovarajućih ramanskih modova. U ovim izračunavanjima, standardna devijacija se zadaje posredno, preko širine raspodele na polovini visine (w), koja za Gauss-ovu raspodelu ima oblik $w = 2\sigma\sqrt{\ln 4} = 2.355\sigma$ [98].

Intenziteti ramanskog moda kod CeO_2 izračunati za različite vrednosti prosečne dimenzije nanočestice L_0 i širinu distribucije od $w=0.50L_0$ prikazani su na Slici 2.13(a), odakle se vidi da se usled prisustva nehomogene raspodele nanočestica pojačava asimetrija moda ka nižim učestanostima, dok je položaj moda određen u najvećoj meri prosečnom dimenzijom nanočestice L_0 . U poređenju sa MFO sa uniformnom nanočesticom od 6 nm, može se uočiti da u slučaju CeO_2 ne dolazi do značajne promene položaja moda, ali se javlja dodatno širenje (videti Tabelu 2.2.) Na sličan način i sa istim parametrima Gauss-ove distribucije, pokazuje se i kod anatas TiO_2 (Slika 2.13(b)) da postoji snažan uticaj distribucije dimenzija nanočestice na širenje ramanskog moda sa smanjenjem srednje dimenzije, dok, u odnosu na MFO sa uniformnom dimenzijom nanočestice, do promene položaja moda prektično ne dolazi (Tabela 2.2.). Treba primetiti i da je asimetrija kod TiO_2 mnogo izraženija nego kod CeO_2 , što je u ovom primeru *direktna posledica nagiba disperzionih grana*, koje učestvuju u proračunu.



Slika 2.13. Prikaz zavisnosti položaja i poluširine ramanskog moda dobijeni pomoću MFO sa simetričnom Gauss-ovom distribucijom nanočestice sa standardnom devijacijom $w = 0.50L_0$ za CeO_2 (a) i TiO_2 (b). Položaji i širine ovih modova CeO_2 i TiO_2 za L_0 od 6 i 50 nm dati su u Tabeli 2.2.

Uticaj nehomogene raspodele nanočestice može se uključiti primenom nekih drugih raspodela. Ovde će biti ilustrovan primer *asimetrične Gauss-ove raspodele*, koja se koristi kada se pomoću nekih referentnih merenja (SEM, TEM, AFM) ustanovi da postoji asimetrična raspodela veličine čestice. *Step-funkcija*²⁰, unosi neophodnu asimetriju u uobičajenu Gaussovou raspodelu, kao što je prikazano u sledećoj jednačini:

$$\rho(L) = \frac{C}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left\{ [1 - h(L - L_0)] \exp\left(\frac{-(L - L_0)^2}{2\sigma_L^2}\right) + h(L - L_0) \exp\left(\frac{-(L - L_0)^2}{2\sigma_D^2}\right) \right\}, \quad (2.27)$$

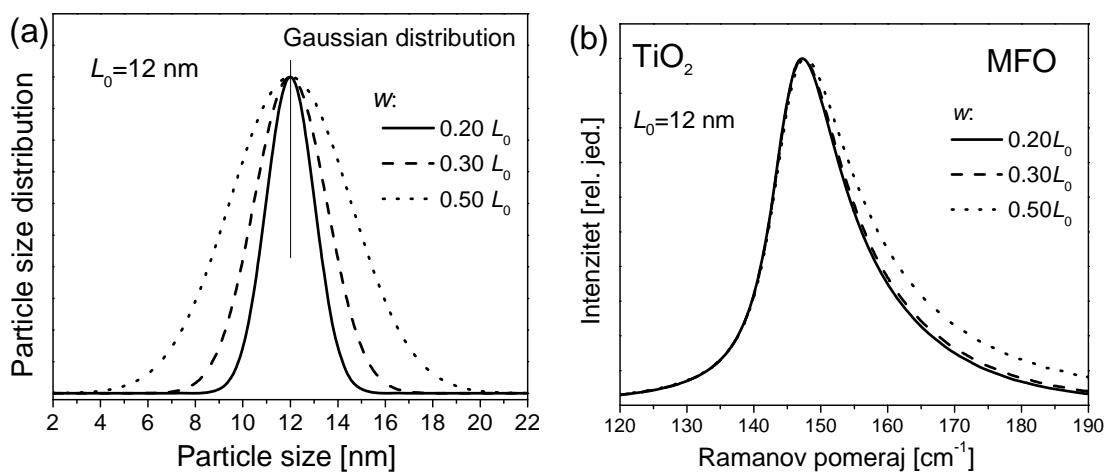
gde je step-funkcija definisana kao

$$h(L - L_0) = \begin{cases} 0 & L < L_0 \\ 1 & L > L_0 \end{cases}. \quad (2.28)$$

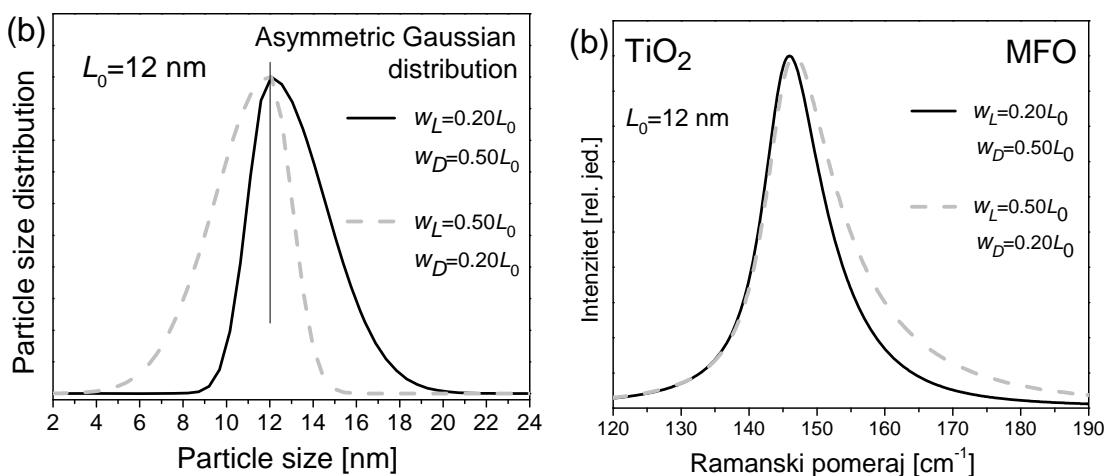
L_0 je centralna vrednost (maksimum) asimetričnog gausijana, σ je srednja poluširina definisana kao $\sigma = (\sigma_L + \sigma_D)/2$ (gde su σ_L i σ_D standardne devijacije, koje odgovaraju levoj, odnosno desnoj strani asimetrične Gauss-ove krive), dok je C oblast ispod krive u normalizovanoj distribuciji. *Asimetrija* raspodele definiše se pomoću faktora $A_G = (\sigma_L - \sigma_D)/(\sigma_L + \sigma_D)$. Standardne devijacije σ_D i σ_L se u proračunima zadaju na isti način kao kod simetrične Gauss-ove raspodele, tj. kao odgovarajuće širine na polovini maksimuma raspodele, w_L odnosno w_D .

²⁰ Poznata i kao Heaviside-ova funkcija.

Na Slici 2.14.(a) prikazan je primer tri simetrične Gauss-ove distribucije, sa širinama (w), definisanim na isti način kao kod simetrične Gauss-ove raspodele: $0.20L_0$, $0.30L_0$ i $0.50L_0$. Ukupan opseg obuhvaćenih čestica iznosi od 2 do 50 nm, sa centralnom vrednošću $L_0=12$ nm. Odgovarajući spektri ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha prikazani su na Slici 2.14.(b). U ovim proračunima korišćeni su isti parametri kao i kod dve prethodne slike. Sa porastom vrednosti standardne devijacije σ , odnosno širine w , može se uočiti asimetrično širenje ramanskog moda u smeru većih učestanosti, jer je proračunom obuhvaćen veći broj čestica manjih dimenzija, čije prisustvo je odgovorno za asimetrično širenje.



Slika 2.14. Primeri simetrične Gauss-ove distribucije (a) i odgovarajući ramanski spektri anatas TiO_2 nanopraha, sa srednjom česticom dimenzije $L_0=12$ nm (b).



Slika 2.15. Primeri asimetrične Gauss-ove distribucije (a) i odgovarajući ramanski spektri anatas TiO_2 nanopraha, sa srednjom česticom dimenzije $L_0=12$ nm (b).

Na Slici 2.15.(a) dat je primer dve asimetrične Gauss-ove distribucije, sa faktorima asimetrije $A_G = -0.43$ ($w_L = 0.20L_0$ i $w_D = 0.50L_0$) i $A_G = +0.43$ ($w_L = 0.50L_0$ i $w_D = 0.20L_0$). Pozitivan faktor asimetrije, kada u raspodeli učestvuje veći broj sitnijih čestica ($w_L > w_D$), pomera spektar ka većim učestanostima, što odgovara asimetričnom širenju ramanskog moda, kao što je prikazano na Slici 2.15(b).

Mada Gauss-ova distribucija kod mnogih materijala veoma dobro modeluje ramanske spektre [50, 93, 99], mogu se koristiti i neke druge raspodele, kao što je log-normlna, koja uz odgovarajući izbor parametara može da da veoma slične rezultate kao simetrična Gauss-ova raspodela.

2.3.1.4. Modelovanje nehomogenog naprezanja u MFO

U vibracijskoj spektroskopiji je ubičajeno modelovanje normalnih vibracija primenom harmonijske aproksimacije. Međutim, uticaj temperature i pritiska na svojstva materijala, samim tim i normalne vibracije (u ovom slučaju ramanske modove, tj. njihovo pomeranje i/ili širenje) ne može se modelovati u ovoj aproksimaciji, imajući u vidu da su konstante sile konstantne i nezavisne od rastojanja između dve mase [100]. Uticaj pritiska i temperature na ramanski spektar materijala po svojoj prirodi je anharmonijski i merenje pomeraja učestanosti izazvanog delovanjem temperature ili pritiska praktično predstavlja merenje anharmonijskih efekata. Pritisak i/ili temperatura izazivaju izotropne ili anizotropne deformacije molekula i kristala, tako da je pomeraj učestanosti ramanskog moda $\Delta\omega/\omega$ praktično određen *deformacijom*, odnosno promenom zapremine kristala $\Delta V/V$.

Pritisak utiče na ravnotežno rastojanje medju jezgrima, deformišući elektronski oblak, a na taj način i restitucione sile, dok temperatura utiče na populaciju fonona na različitim nivoima ($v=0,1,\dots$) kod svakog normalnog moda i usled neekvidistantnosti energijskih nivoa menjaju se prosečni položaji atoma [100]. Anharmoničnost potencijala po pravilu je povezana sa promenom parametra rešetke, a promene poluširine ramanskog moda, do kojih istovremeno dolazi pod uticajem pritiska, pripisuju se razbijanju datog fonona na 2 ili 3 nova fonona.

U velikom broju istraživanja registrovano je pomeranje učestanosti i cejanje ramanskog spektra usled naprezanja nastalog promenom temperature ili pritiska [100,

101]. Osnovni koncept u tumačenju promene spektralnih parametara sa temperaturom i pritiskom oslanja se na Grüneisen-ov model [100, 102], u kojem je, budući da se učestanost vibracijskog moda menja sa zapreminom jedinične čelije, prepostavljeno da je relativna promena učestanosti direktno proporcionalna relativnoj promeni zapremine čelije. Grünenisen-ov parametar definiše zavisnost učestanosti fonona od zapremine kristala i određuje se posebno za svaki vibracijski mod. Pozitivan Grüneisen-ov parametar ukazuje na porast fononske učestanosti sa povećanjem pritiska. Eksperimentalne vrednosti ovog parametra dostupne su samo za fonone iz centra BZ [49, 66], a teorijsko predviđanje ponašanja Grüneisen-ovog parametra za različite vibracijske modove duž pravaca visoke simetrije u BZ za CeO₂ dali su nedavno Gürel i Eryiğit [49], ali je u literaturi i dalje uobičajeno da se, bar kada je u pitanju MFO, koristi isti Grüneisen-ov parametar za sve fonone iz BZ, koji učestvuju u modelu [50, 93, 94].

Grüneisen-ov parametar za kristalni materijal definisan je kao [50, 102, 103]:

$$\gamma_i = -\frac{\Delta\omega_i(q)}{\omega_i(q)} \cdot \frac{V}{\Delta V} = -\frac{d \ln \omega_i(q)}{d \ln V} = \frac{B}{\omega_i(q)} \cdot \frac{d\omega_i(q)}{dP}, \quad (2.29)$$

i daje osetljivost pojedinačnog moda na promenu zapremine kristala usled delovanja hidrostatičkog pritiska. Iz jednačine (2.29) se promena učestanosti usled promene zapremine izražava u obliku

$$\Delta\omega_i(q) = -\gamma_i \omega_i(q) \frac{\Delta V}{V}. \quad (2.30)$$

Sa smanjivanjem veličine nanočestice L usled efekta *mikronaprezanja*²¹ u nanomaterijalima je registrovana promena parametara rešetke, a samim tim i zapremine jedinične čelije [65, 78, 104]. Dakle, naprezanje utiče na parametre rešetke, odnosno zapreminu jedinične čelije, a time i na položaj ramanskog moda, tako što se mod, koji se nalazi na učestanosti ω_i , pomera za vrednost $\Delta\omega_i$ (2.30), koja zavisi od veličine nanočestice L . Pomeraj ramanskog moda usled unutrašnjeg naprezanja u nanomaterijalu, $\Delta\omega(q, L)$, uvodi se u MFO na sledeći način:

$$I(\omega) \propto \sum_{i=1}^m \int_0^\infty \rho(L) dL \int \frac{\exp\left(-\frac{q^2 L^2}{8\beta}\right) d^3 q}{^{BZ}(\omega - (\omega_i(q) + \Delta\omega(q, L)))^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}, \quad (2.31)$$

²¹ Microstrain.

gde su ostali parametri ranije definisani uz jednačine (2.21) i (2.25).

Imajući u vidu da je u slučaju kubne kristalne rešetke $\Delta V / V = 3\Delta a / a_0$ (npr. kod CeO₂), uvedeni pomeraj (2.30) svodi se na :

$$\Delta\omega_i(q, L) = -3\gamma_i(q)\omega_i(q) \frac{\Delta a}{a_0}, \quad (2.32)$$

gde je $\Delta a = a - a_0$ relativna promena parametra rešetke u odnosu na vrednost u kristalu (a_0). Pozitivan znak promene konstante rešetke Δa ukazuje na širenje rešetke, a negativan na njeno sabijanje. S druge strane, promena parametra rešetke može se povezati sa delovanjem hidrostatičkog pritiska P i u slučaju kubne rešetke iznosi $\Delta a/a = -P/3B$, gde je B moduo elastičnosti u kristalu [100]. Na osnovu ove veze, dva vida naprezanja - sabijanje i istezanje ²² povezani su sa negativnom odnosno pozitivnom relativnom promenom parametra rešetke Δa .

U slučaju uniformne dimenzije nanočestice L , korišćenjem pomeraja učestanosti prema jednačini (2.32) u MFO (2.31) modeluje se *usrednjeno naprezanje*²³, kao popravka usvojene disperzione funkcije za konstantan iznos, koji odgovara dimenziji nanočestice L .

Sa druge strane, uključivanjem neuniformne distribucije dimenzije nanočestice $\rho(L)$ u MFO, uključuje se i promena parametra rešetke na široj skali promene, čime se modeluje *nehomogeno naprezanje*²⁴, tj. odgovarajuće širenje ramanskog moda, uz prepostavku da je naprezanje unutar pojedinačne čestice uniformno [50].

Uobičajeno je da se kod promena parametra rešetke a sa promenom veličine nanočestice predstavlja analitički, najčešće kao nelinearna funkcija [50, 105]:

$$a(L) = a_0 \pm k / L^2, \quad (2.33)$$

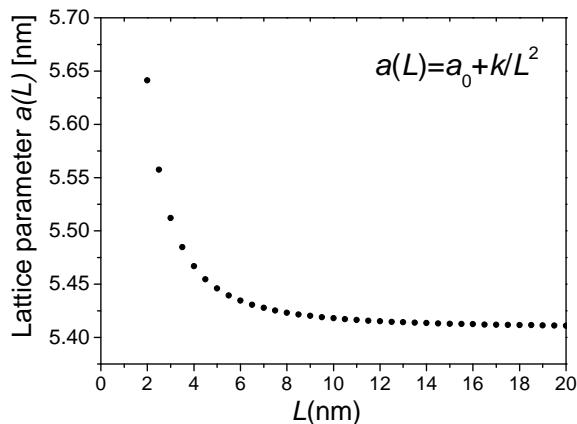
gde je a_0 vrednost parametra rešetke u kristalu, dok je k parametar koji definiše ponašanje kristalne rešetke. Tsunekawa i saradnici (ref. [65]) eksperimentalno su ustanovili povećavanje parametra rešetke sa smanjenjem dimenzije nanočestice kod nanokristalnog CeO₂, što su kasnije potvrdili i drugi autori. Ova pojava se objašnjava povećanjem broja kiseoničnih vakancija u nanomaterijalu i prisustvom Ce³⁺ jona, koji

²² Compressive strain, tensile strain, redom.

²³ Average strain.

²⁴ Inhomogeneous strain.

imaju veći jonski radijus od Ce^{4+} [42, 105, 106], o čemu će u narednim poglavljima biti više reči. Jedan primer zavisnosti date jednačinom (2.33), koji će biti korišćen u daljim proračunima, ilustrovan je na Slici 2.16.



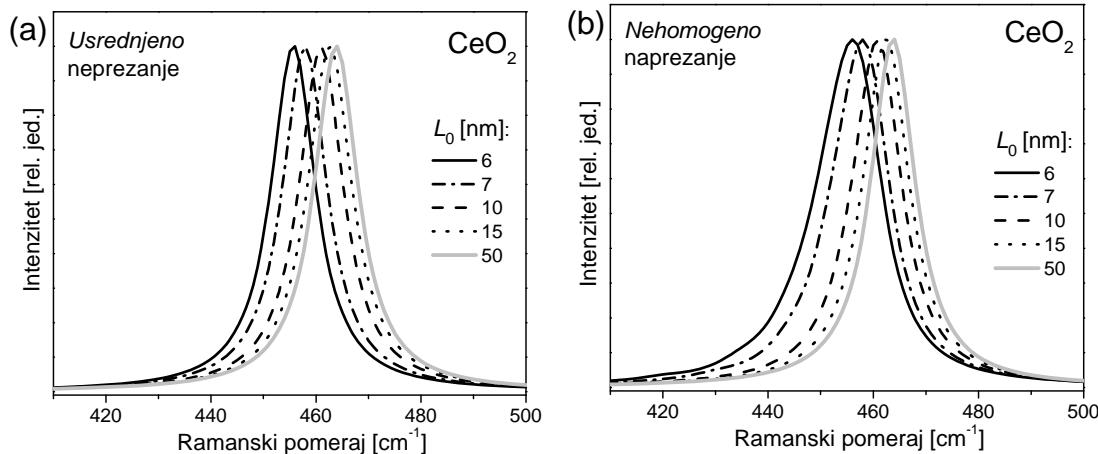
Slika 2.16. Zavisnost parametra rešetke od veličine nanočestice.

Parametri: $a_0=0.54087$ nm, $k=0.0939 \cdot 10^3$ nm³ [50, 105].

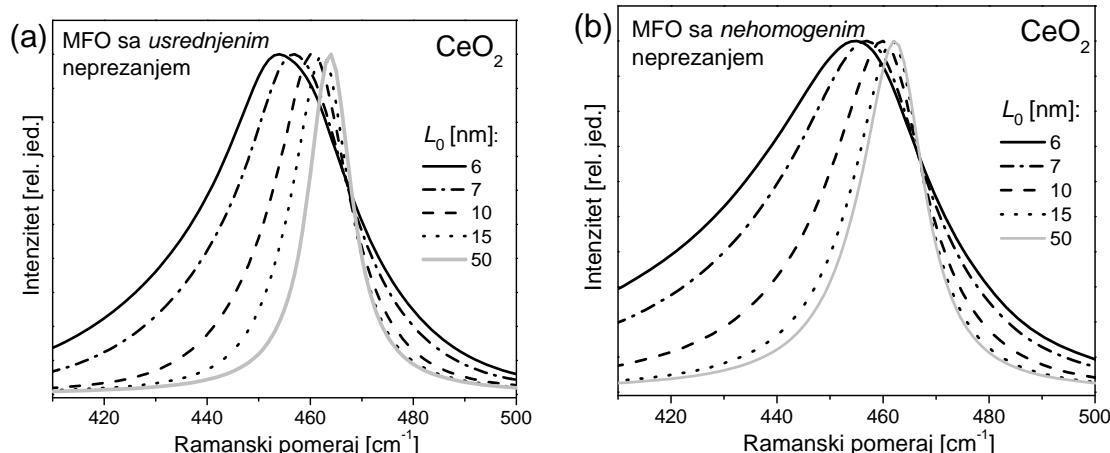
Na Slici 2.17(a) prikazani su ramanski spektri CeO_2 nanokristala, modelovani prema jednačini (2.31), za odabrane uniformne vrednosti nanočestice, pri čemu je uračunat uticaj usrednjjenog naprezanja, a zanemaren uticaj fononskog ograničenja usled smanjivanja dimenzije nanočestice (korišćenjem faktora ograničenja $\beta << 1$). Zavisnost parametra rešetke i popravka disperzione funkcije, kojom se uračunava naprezanje u nanomaterijalu, uključeni su primenom jednačina (2.33) i (2.32), redom. Grüneisen-ov parametar za ramanski F_{2g} mod na 464 cm^{-1} ima vrednost $\gamma=1.24$ za sve vrednosti talasnog vektora q u okviru BZ [50, 67]. Kao što se vidi sa Slike 2.17(a), smanjivanje dimenzije nanočestice dovodi uniformnog pomeranja ramanskog moda CeO_2 ka nižim učestanostima, bez širenja u odnosu na kristalni materijal.

Za razliku od usrednjjenog, kod nehomogenog naprezanja uvodi se prepostavka raspodele dimenzija nanočestica, u ovom slučaju Gauss-ove raspodele, gde svakoj dimenziji nanočestice, prema jednačini (2.33), odgovara drugi parametar rešetke, a samim tim i različit pomeraj fononske disperzione funkcije (2.32). Na Slici 2.17(b) prikazani su ramanski spektri računati pod istim uslovima kao na Slici 2.17(a), sa tom razlikom što su nanočestice grupisane oko srednje dimenzije nanočestice L_0 , sa širinom $w=0.50L_0$. Ovde takođe dolazi do pomeranja položaja ramanskog F_{2g} moda sa

smanjivanjem srednje dimenzije nanočestice, ali i do njegovog izraženog širenja, pod uticajem distribucije veličine nanočestice, odnosno odgovarajućeg nehomogenog naprezanja.



Slika 2.17. Prikaz uticaja usrednjjenog (a) i nehomogenog (b) unutrašnjeg naprezanja na modelovanje ramanskog F_{2g} moda u CeO_2 nanoprahu. Kod nehomogenog naprezanja korišćena je simetrična Gauss-ova raspodela dimenzija čestica u granicama 2-50nm, $w=0.50L_0$, dok su ostali parametri proračuna dati u prethodnom poglavlju.



Slika 2.18. Prikaz MFO sa usrednjjenim (a) i nehomogenim naprezanjem (b) za ramanski F_{2g} mod u CeO_2 nanoprahu. Korišćeni su parametri kao na prethodnoj slici, uz $\beta=2\pi^2$.

Na Slici 2.18. prikazani su ramanski spektri CeO_2 nanopraha, dobijeni primenom MFO, koji uključuje fononsko ograničenje ($\beta=2\pi^2$) i usrednjeno naprezanje (a), odnosno

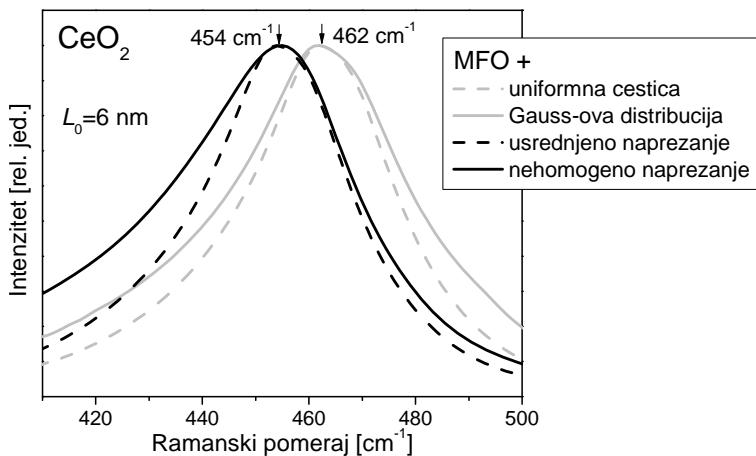
fononsko ograničenje i nehomogeno naprezanje (b). Spektri modelovani primenom MFO sa usrednjениm naprezanjem dobijeni su prema jednačini (2.31) za odabrane uniformne dimenzije nanočestice, sa uticajem usrednjjenog naprezanja kao na Slici 2.17(a).

Tabela 2.3. Pregled karakteristika modelovanog ramanskog F_{2g} moda CeO_2 sa usrednjениm i nehomogenim naprezanjem (Slika 2.17.)

	L_0	model	$\omega [\text{cm}^{-1}]$	$\Gamma [\text{cm}^{-1}]$
CeO_2 (F_{2g})	kristal ($>50 \text{ nm}$)		464	10
	6 nm (uniformna)	MFO	462	33
	6 nm ($w=0.50L_0$)	MFO + distribucija nanočestice	462	40
	6 nm (uniformna)	MFO+usrednjeno naprezanje	454	33
	6 nm ($w=0.50L_0$)	MFO+nehomogeno naprezanje	455	44

Sa druge strane, primena MFO sa nehomogenim naprezanjem (Slika 2.18(b)) obuhvata i Gauss-ovu distribuciju dimenzije nanočestice, prema jednačini (2.31), sa odgovarajućom promenom parametra kristalne rešetke, odnosno pomerajem fononske disperzije, u skladu sa jednačinama (2.33) i (2.32). U oba slučaja, sa smanjivanjem dimenzije nanočestice dolazi do značajnog pomeranja položaja ramanskog F_{2g} moda, ali i do izraženog asimetričnog širenja spektra. Ovo širenje je izraženije kod nehomogenog nego kod usrednjjenog naprezanja, kako je prikazano za česticu dimenzije 6 nm u Tabeli 2.3.

U Tabeli 2.3. i na Slici 2.19. dato je poređenje rezultata MFO za ramanski F_{2g} mod CeO_2 sa dimenzijom nanočestice od 6 nm. Ovim prikazom obuhvaćeni su značajni rezultati iz ovog i prethodnog poglavlja, sa ciljem da se ukaže na uticaj uniformne i Gauss-ove distribucije dimenzije nanočestice, kao i usrednjjenog i nehomogenog naprezanja u materijalu. Rezultati dobijeni pomoću MFO sa uniformnom česticom i sa Gauss-ovom distribucijom dimenzije nanočestice (bez uticaja naprezanja), prikazani su ranije u Poglavlju 2.3.1.3. na Slikama 2.12(a) i 2.13.(a), redom. Pokazuje se da usrednjeno naprezanje unosi u MFO dodatno pomeranje, ali ne i širenje ramanskog F_{2g} moda (spektri dati na Slici 2.19. isprekidanim linijama). Sa druge strane, kod MFO koji uključuje i neuniformnu distribuciju dimenzije nanočestice, naprezanje, pored izraženog pomeranja moda, unosi i dodatno asimetrično širenje (spektri dati punim linijama).



Slika 2.19. Poređenje rezultata MFO za ramanski F_{2g} mod kod CeO_2 nanopraha sa nanočesticom od $L_0=6$ nm.

Treba napomenuti da se kod većine oksidnih nanoprahova, sa smanjivanjem nanočestice povećava parametar rešetke i to po nelinearnom (kao što je već prikazano kod CeO_2 [107]) ili linearom zakonu (u slučaju nanopraha rutila [108]). Nasuprot tome, kod anatas TiO_2 nanoprahova, u zavisnosti od načina sinteze, sa smanjivanjem nanočestice može se ispoljiti drugačije ponašanje [104], o čemu će posebno biti reči u poglavlju koje se odnosi na analizu eksperimentalnih ramanskih spektara anatas TiO_2 nanoprahova.

2.3.1.5. Modelovanje anharmonijskog efekta

Temperaturska zavisnost ramanskog rasejanja široko je izučavana oblast, posebno kod poluprovodnih kristala, gde se već nekoliko decenija uglavnom primenjuje Klemens-ov model [80, 109], u kome se uzima da je promena širine ramanskog moda posledica trofononskog procesa - raspada optičkog fonona na dva niskoenergijska akustička fonona iste učestanosti i suprotnih momenata, koji pripadaju istoj disperzionaloj grani. Kasnije poboljšanje ove teorije nastaje iz potrebe da se preciznije modelira temperaturska zavisnost položaja i širine ramanskog moda na višim temperaturama²⁵, uvodjenjem četvorofononske popravke [82, 110].

²⁵ Promena širine ramanskih i infracrvenih modova u materijalima može se koristiti za posredno procenjivanje vremena života jako interagujućih optičkih fonona, jer je širenje spektra obrnuto proporcionalno životu fonona [110].

Zavisnost položaja i širine ramanskog moda od temperature pripisuje se anharmonijskom članu u razvoju vibracijske potencijalne energije, gde usled anharmoničnih vibracija rešetke optički mod može da razmenjuje energiju sa drugim modovoma rešetke i tako održava toplotnu ravnotežu sistema [82]. Balkanski, Wallis i Haro [82] definišu temperatursku zavisnost položaja i širine ramanskog moda u poluprovodniku ispod Debye-eve temperature kod optičkog LO moda u centru BZ kao niz anharmonijskih popravki, pa je učestanost ramanskog moda na tempereturi T definisana kao [50, 82]:

$$\omega(T) = \omega_0 + \Delta^{(1)}(T) + \Delta^{(2)}(T), \quad (2.34)$$

gde je ω_0 učestanost ramanskog moda, koja odgovara harmonijskoj aproksimaciji.

Drugi član razvoja, $\Delta^{(1)}$, predstavlja temperatursku popravku u obliku

$$\Delta^{(1)}(T) = \omega_0 [\exp(-3\alpha\gamma_i T) - 1]. \quad (2.35)$$

Ovaj izraz je vezan za toplotno širenje, gde je α koeficijent toplotnog širenja, nezavisan od temperature, a γ_i Grüneisen-ov parametar, opisan u Poglavlju 2.3.1.4. Na višim temperaturama ova popravka dovodi do povećanja energije ramanskog pika proporcionalno temperaturi T .

Treći član razvoja je vezan za anharmonijsko sparivanje fonona i predstavlja se izrazom:

$$\Delta^{(2)}(T) = A_1 \left[1 + \sum_{j=1}^2 \frac{1}{\exp(x_j) - 1} \right] + A_2 \left[1 + \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{\exp(y_k) - 1} + \frac{1}{(\exp(y_k) - 1)^2} \right) \right], \quad (2.36)$$

gde prvi član opisuje trofononski, a drugi član četvorofononski proces (A_1 i A_2 su nezavisni parametri koji se podešavaju na osnovu eksperimentalnih rezultata). *Trofononski proces* (kubna anharmoničnost) odnosi se na sparivanje optičkog fonona sa dva fonona niže energije, gde je $x_1=x_2=\hbar\omega_0/2kT$. Ovaj doprinos je na višim temperaturama srazmeran temperaturi T [50, 82, 109]. *Četvorofononski proces* predstavlja sparivanje optičkog fonona sa tri fonona niže energije, za koji važi $y_1=y_2=\hbar\omega_0/3kT$. Na višim temperaturama ovaj proces je srazmeran kvadratu temperature, $\sim T^2$.

Odgovarajuća širina ramanskog moda na temperaturi T definisana je relacijom [50, 92]:

$$\Gamma(T) = \Gamma_0 + \Delta\Gamma(T), \quad (2.37)$$

gde je Γ_0 harmonijska širina, a $\Delta\Gamma(T)$ anharmonijska popravka širine. Γ_0 može da obuhvata i druge uzroke širenja ramanskog moda, koji ne zavise od generacije fonona u materijalu usled povećanja temperature, a mogu biti povezani sa rezolucijom mernog instrumenta ili karakteristikama materijala (npr. nehomogenog naprezanja) [50, 92]. Anharmonijska popravka $\Delta\Gamma(T)$ ima praktično isti oblik kao anharmonijska popravka učestanosti ramanskog moda:

$$\Delta\Gamma(T) = B_1 \left[1 + \sum_{j=1}^2 \frac{1}{\exp(x_j) - 1} \right] + B_2 \left[1 + \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{\exp(y_k) - 1} + \frac{1}{(\exp(y_k) - 1)^2} \right) \right], \quad (2.38)$$

gde se prvi i drugi član takođe odnose na trofononski i četvorofononski proces, redom, dok su B_1 i B_2 takođe parametri, koji se podešavaju u zavisnosti od eksperimentalnih rezultata. Prvi član, koji se odnosi na trofononski proces, na višim temperaturama daje znatno lošiju procenu širine moda, pa je tada opravdano uvođenje četvorofononskog procesa u temperatursku zavisnost [82, 109].

Kod nanomaterijala se očekuje da dimenzija nanočestice, koja ima veliki uticaj na njegova svojstva, dodatno modifikuje i temperatursku zavisnost ramanskog spektra. Smanjivanje dimenzije nanočestice udruženo sa anharmonijskim efektom, može da dovede do još izraženijeg pomeranja i širenja ramanskog moda. Pri tome je znantno teže odrediti doprinos koji širenju ramanskog moda daje sam anharmonijski efekat u heterostrukturnim ili nanostrukturnim materijalima, gde su uticaji defekata i nehomogenosti, tj unutrašnjih napezanja, mnogo izraženiji [50, 92].

Usled nedostatka adekvatnih informacija o anharmonijskom efektu kod nanokristalnih materijala, polazi se od prepostavke da temperaturska zavisnost vibracijskih svojstava u nanokristalu ima isti oblik kao odgovarajuća zavisnost u kristalima. Međutim, kod nanomaterijala se mora uzeti u obzir da na učestanost i širinu ramanskog moda utiče i fononsko ograničenje, tako da se umesto temperaturski nezavisnih parametara ω_0 i Γ_0 kod kristala, uvode odgovarajući parametri ω_1 i Γ_1 , koji takođe ne zavise temperature, ali uključuju i pomeranje, odnosno širenje ramanskog moda, nastalo usled fononskog ograničenja:

$$\omega(T) = \omega_1 + \Delta^{(1)}(T) + \Delta^{(2)}(T), \quad (2.39)$$

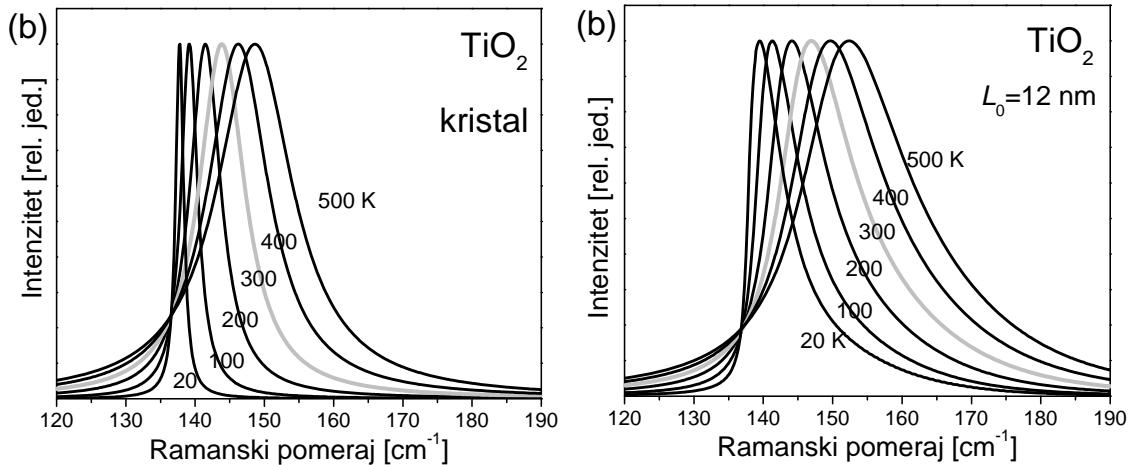
$$\Gamma(T) = \Gamma_1 + \Delta\Gamma(T), \quad (2.40)$$

gde su $\Delta^{(1)}$, $\Delta^{(2)}$ i $\Delta\Gamma$ definisani jednačinama oblika (2.35), (2.36) i (2.38). Ovakav pristup izabrali su Zhu i saradnici [92] u analizi anharmonijskog efekta u anatas TiO_2 nanokristalima i dobili da se parametri ω_1 i Γ_1 drastično menjaju u zavisnosti od dimenzije nanokristala.

Pri modelovanju anharmonijskog efekta kod nanomaterijala može se razdvojiti uticaj fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta na položaj i širinu ramanskih modova. U tom slučaju, anharmonijski efekat se uključuje kao uticaj koji dodatno modifikuje ramanski spektar nanokristala, inače modelovan primenom MFO [92, 110, 111]. Tada je intenzitet ramanskog moda dat u obliku:

$$I(\omega, T) \propto \sum_{i=1}^m \int_0^\infty \rho(L) dL \int_{BZ} \frac{\exp\left(-\frac{q^2 L^2}{8\beta}\right) d^3 q}{(\omega - (\omega_i(q, T) + \Delta\omega(q, L)))^2 + \left(\frac{\Gamma(T)}{2}\right)^2}, \quad (2.41)$$

gde svi parametri imaju isto značenje kao i u jednačini (2.31), s tom razlikom što disperzione funkcije $\omega_i(q, T)$ i širina moda $\Gamma(T)$ ovde uključuju i temperatursku zavisnost.



Slika 2.20. Prikaz ramanskih spektara na različitim temperaturama, dobijenih primenom MFO sa anharmonijskim efektom za anatas TiO_2 kristal (a) i nanokristal sa česticom od 12 nm (parametri MFO preuzeti iz prethodnih poglavlja: $L_0=12$ nm, $\beta=2\pi^2$, Γ -X pravac BZ) (b).

Na Slici 2.20. prikazani su ramanski spektri anatas TiO_2 modelovani primenom MFO sa anharmonijskim efektom (2.41) na temperaturama od 20 do 500 K, gde su korišćene

odgovarajuće anharmonijske popravke za položaj $\omega(q, T)$ i širinu moda $\Gamma(T)$. Anharmonijski efekat uračunat je pomoću jednačina (2.34) i (2.36) za promenu učestanosti ramanskog moda, pri čemu je uticaj člana $\Delta^{(1)}(T)$ zanemaren, a kod $\Delta^{(2)}(T)$ uzet u obzir samo trofononski proces (prvi član). Širina ramanskog moda modelovana je pomoću jednačina (2.37) i (2.38), gde je takođe uzet u obzir samo trofononski proces u anharmonijskoj popravci širine $\Delta\Gamma(T)$. Pri tome su u navadenim jednačinama korišćeni parametri koji odgovaraju kristalnom anatas TiO_2 [92]: $\omega_1=136.46 \text{ cm}^{-1}$, $A_1=1.18 \text{ cm}^{-1}$, $A_2=0$, $\Gamma_1=0$, $B_1=1.31 \text{ cm}^{-1}$ i $B_2=0$. Na Slici 2.20(a) prikazani su uticaj anharmonijskog efekta na pomeranje i širenje ramanskog E_g moda kod kristalnog anatas TiO_2 , odakle se vidi da sa povećanjem temperature dolazi do ravnomernog pomeranja i simetričnog širenja ramanskog moda u kristalu. Na Slici 2.20(b) prikazani su ramanski spektri anatas TiO_2 nanokristala sa česticom dimenzije 12 nm, modelovani primenom MFO prema jednačini (2.41). Kao što je očekivano, usled uticaja fononskog ograničenja kod nanokristala, osim pomeranja položaja moda, sa porastom temperature dolazi i do znantno većeg širenja. Pri tome je asimetrija izraženija na nižim temperaturama, gde je uticaj fononskog ograničenja veći od uticaja anharmonijskog efekta.

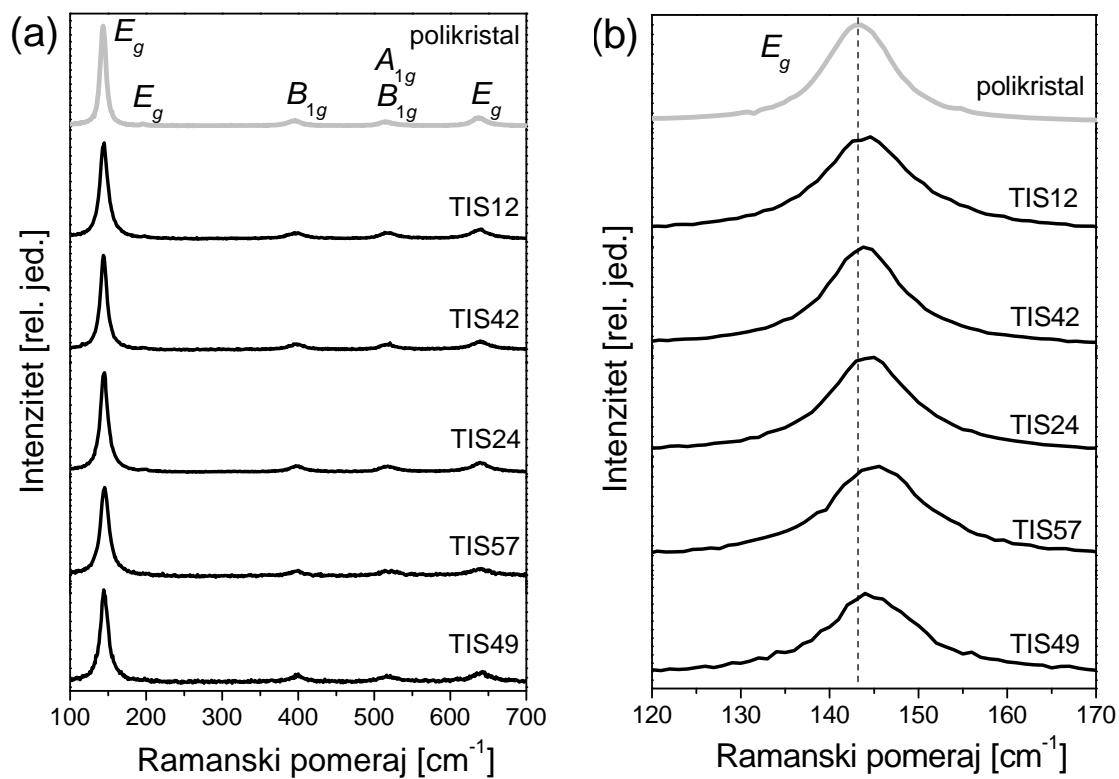
Rezultati prikazani u ovom poglavlju predstavljaju samo ilustraciju modelovanja anharmonijskog efekta u okviru MFO, a detaljna analiza anharmonijskog efekta i poređenje sa eksperimentalnim spektrima anatas TiO_2 nanoprahova biće prikazana u Poglavlju 2.4.1.5.

2.4. Ramanski spektri anatas TiO_2 nanoprahova

Ramanska merenja izvedena su u geometriji unazad koristeći zelenu liniju argonskog (Ar^+) lasera talasne dužine 514.5 nm. Korišćeni su Jobin-Yvon U1000 dvostruki monohromator i fotomultiplikator kao detektor, a više konkretnih detalja o ovoj aparaturi dato je u Poglavlju 2.2. Dobijeni eksperimentalni spektri anatas TiO_2 nanoprahova prikazani su na Slici 2.21(a), zajedno sa spektrom polikristalnog praha, gde su čestice veće od 50 nm [112]. Svi registrovani ramanski modovi mogu biti identifikovani na osnovu ramanskog spektra anatas TiO_2 monokristala [6]: ~ 144 (E_g),

197 (E_g), 399 (B_{1g}), 513 (A_{1g}), 519 (B_{1g}) i 639 cm^{-1} (E_g). Očitani položaji pojedinih modova prikazani su u Tabeli 2.4, pri čemu treba imati u vidu da je položaj najintenzivnijeg E_g moda određen sa većom preciznošću od ostalih modova. Pored ovih rezultata, u Tabeli 2.4 dati su i eksperimentalni podaci o ramanskom spektru anatas TiO_2 monokristala [6], praha [8] i teorijski rezultati koji se odnose na monokristal [5]²⁶.

Na Slici 2.21(b), na kojoj je izdvojen najintenzivniji E_g mod, uočava se njegovo pomeranje ka višim učestanostima u odnosu na polikristalni prah. Širina modova kod nanoprahova kreće se u opsegu $\sim 10.5\text{-}13.5\text{ cm}^{-1}$, uz blagu asimetriju, pa je osim pomeranja, evidentno i širenje ovog moda u odnosu na njegovu širinu u polikristalnom prahu (8.5 cm^{-1}). Uzroci pomeranja i širenja ovog moda biće posebno analizirani u sledećem poglavlju.



Slika 2.21. Ramanski spektri (a) i E_g modovi (b) anatas TiO_2 polikristala i nanoprahova.

²⁶ Osim navedenih rezultata, u literaturi se podaci za najintenzivniji ramanski mod E_g simetrije u kristalu kreću od 141 cm^{-1} [16] do 144 cm^{-1} [6].

Na osnovu spektara prikazanih na Slici 2.21(a) i odgovarajućih podataka iz Tabele 2.4, može se uočiti da se ostali modovi kod anatas TiO_2 nanoprahova ne razlikuju među sobom, niti mnogo odstupaju u odnosu na kristalni materijal. Osim toga, kako je preciznija analiza njihovog položaja i oblika otežana zbog malog intenziteta, oni neće biti predmet dalje analize.

Tabela 2.4. Eksperimentalni Raman aktivni modovi anatas TiO_2 nanoprahova i polikristalnog praha, kao eksperimentalni i teorijski rezultati drugih autora. Učestanosti su date u cm^{-1} .

Mod	Eksperimentalni rezultati					Drugi autori			
	nanoprah					<i>polikristalni prah</i>	<i>polikristalni prah</i>	<i>monokristal</i>	
	TIS12	TIS42	TIS24	TIS57	TIS49		Exp. [8]	Exp. [6]	Teor. [5]
E_{1g}	144	144	144.5	145.3	144.7	143.8	142.8	144	145.6
E_{1g}	197	197	198	-	-	196	195.5	197	171.1
B_{1g}	397	397	398	398	398	395	395.8	399	398.4
A_{1g}	517	517	517	518	517	514	516.0	513	535.9
B_{1g}	517	517	517	518	517	514	516.0	519	518.9
E_{1g}	637	637	638	638	639	637	638.3	639	662.1

2.4.1. Primena MFO na ramanski spektar anatas TiO_2 nanopraha

Karakteristike ramanskog spektra anatas TiO_2 nanopraha zavise od njegove strukture: veličine nanočestica i njihove distribucije, postojanja mešanih faza (npr. anatas u kombinaciji sa rutilom i/ili brukitom u nezanemarljivim količinama), vrste i jačine naprezanja, odstupanja od stehiometrije i slično. Mada se većina objavljenih istraživanja oslanja na fononsko ograničenje kao dominantni efekat u ramanskom spektru nanokristalnog anatas TiO_2 [91, 92, 97, 113-116], neki autori, u zavisnosti od karakteristika materijala, tumače rezultate i u korist nestehiometrije [91, 113, 117] ili unutrašnjeg i površinskog naprezanja, kakvo je uočeno kod sličnih materijala [114, 118, 119]. Osim toga, posebno je razmatrana i temperaturska zavisnost ramanskog spektra

anatas TiO_2 nanoprahova, tj. anharmonijski efekat, povezan sa sprezanjem fonona kroz tro- i četvorofononski proces [92, 101, 111], kakav se obično registruje kod većine poluprovodnih kristala [92, 100, 110]. U slučaju nanokristala anharmonijski efekat je udružen sa uticajem smanjivanja dimenzije nanočestice.

U ovom poglavlju biće interpretirani ramanski spektri anatas TiO_2 nanopraha, i to u smislu pomeranja učestanosti i širenja najintenzivnijeg E_g moda, primenom MFO, koji uključuje uticaj fononskih disperzija, distribuciju veličine čestice i efekte naprezanja, kao i uticaj temperature.

2.4.1.1. Uticaj fononskih disperzionih funkcija na modelovanje ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha

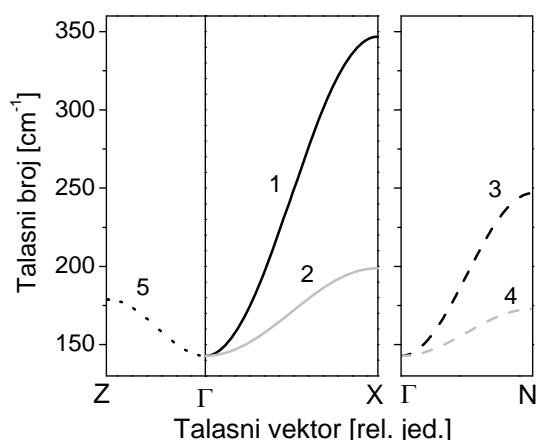
Razlike između eksperimentalnih i modelovanih spektara, kao i razlike između načina primene MFO, koje su povezane sa izborom fononskih disperzionih funkcija anatas TiO_2 nanopraha, nastaju uglavnom iz sledećih razloga: (1) fononske disperzije za kristal anatas TiO_2 do sada nisu izmerene, (2) smatra se da se disperzionalne relacije ne menjaju sa smanjivanjem dimenzije nanočestice i (3) najčešće se primenjuje hipoteza izotropne BZ [90].

Budući da je u Poglavlju 2.3.1.2. već pokazano da kosinusna aproksimacija teorijskih disperzionih funkcija, koje je za kristalni anatas TiO_2 dao Mikami sa saradnicima [5], daje dobre rezultate u modelovanju ramanskog E_g moda u anatas TiO_2 nanokristalu, ovde će biti ispitana opravdanost hipoteze izotropne BZ i analizirani doprinosi pojedinih simetrijskih pravaca i disperzionih grana u BZ, kao i njihov uticaj na modelovanje ramanskog E_g moda.

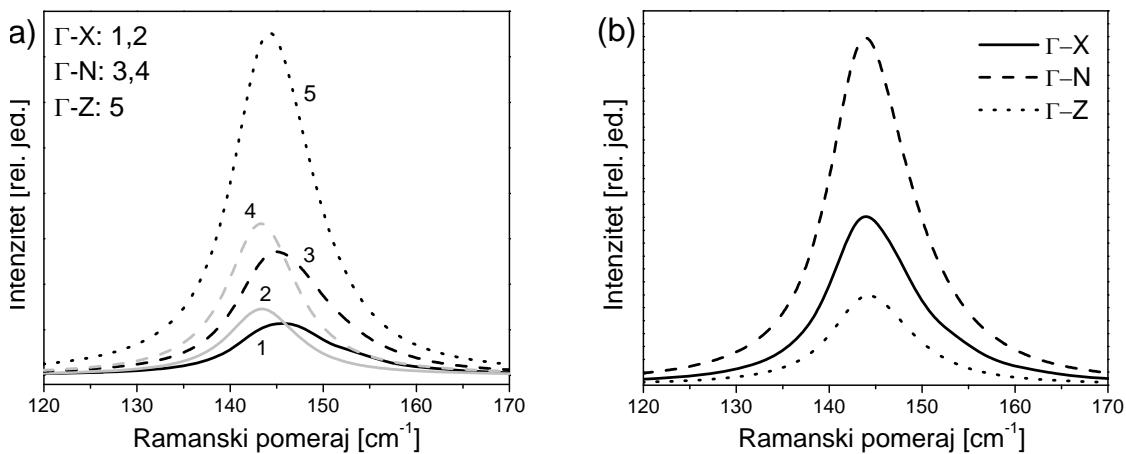
Imajući u vidu da je direktna prostorna rešetka anatas TiO_2 tetragonalna, sa parametrima u odnosu $a/c \approx 1/3$, odgovarajuća BZ se ne može aproksimirati izotropnom sferom. Da bi se dobili što precizniji doprinosi fonona izvan centra BZ, integracija po jednačini (2.25) (Poglavlje 2.3.1.) vrši se uzimajući u obzir stvarni oblik i dimenzije BZ.

Fononske disperzionalne grane po pravcima Γ -X, Γ -N i Γ -Z Brillouin-ove zone, modelovane kosinusnom funkcijom (2.22), prikazane su na Slici 2.22. U Tabeli 2.5, prikazani su odgovarajući parametri B_i , koji definišu nagib disperzionalne krive duž odgovarajućeg pravca BZ, odabrani tako da što približnije reprodukuju teorijske

disperzione krive [5, 92]. Na osnovu ovih disperzionih relacija, izračunati su modovi koji potiču od svake pojedinačne disperzione krive i prikazani na Slici 2.23(a), gde su uzete u obzir različite dimenzije BZ duž pravaca Γ -X, Γ -N i Γ -Z. Za parametre kristalne rešetke prema [19] ($a_0=0.3874$ nm, $c_0=0.9515$ nm), odgovarajuće karakteristične dužine na pravcima visoke simetrije u prvoj BZ stoje približno u sledećem odnosu: $d_{\Gamma-X} / d_{\Gamma-N} / d_{\Gamma-Z} \approx 11.7/8.9/6.6$. Oznake modova 1-5 odgovaraju oznakama disperzionih grana sa Slike 2.22. Zatim su na Slici 2.23(b) predstavljeni računati modovi, koji potiču od pojedinih pravaca visoke simetrije u prostoru talasnog vektora u BZ, pri čemu je uzet u obzir broj ekvivalentnih pravaca simetrije (2 pravca Γ -X, 4 pravca Γ -N i 1 pravac Γ -Z [26]). Na Slici 2.23(a) prikazan je ukupni doprinos u pravcu Γ -Z (kriva označena brojem 5), imajući u vidu dvostruku degeneraciju E_g moda.



Slika 2.22. Kosinusne disperzione relacije anatas TiO_2 u visokosimetričnim prvcima BZ prema Mikami et al. [5]. Parametri su prikazani u Tabeli 2.2.



Rezultati koji su ovde prikazani, dobijeni su primenom MFO, koji uključuje asimetričnu Gauss-ovu raspodelu dimenzija nanočestica (jednačina (2.25)), pri čemu su izabrani parametri koji odgovaraju uzorku TIS49 ($L_0=12.5$ nm, $\Gamma=8.5$ cm $^{-1}$, $\omega_{q=0}=142.8$ cm $^{-1}$, $w_L=0.25L_0$ i $w_D=0.60L_0$).

Tabela 2.5. Parametri nagiba kosinusne disperzione relacije u različitim pravcima visoke simetrije BZ tetragonalne rešetke anatas TiO₂.

<i>Disperziona grana</i>	B_i [cm $^{-1}$]	Oznaka na slici
Γ -X (<i>gornja</i>)	102	1
Γ -X (<i>donja</i>)	28	2
Γ -N (<i>gornja</i>)	52	3
Γ -N2 (<i>donja</i>)	15	4
Γ -Z (<i>dvostruko degenerisana</i>)	18	5

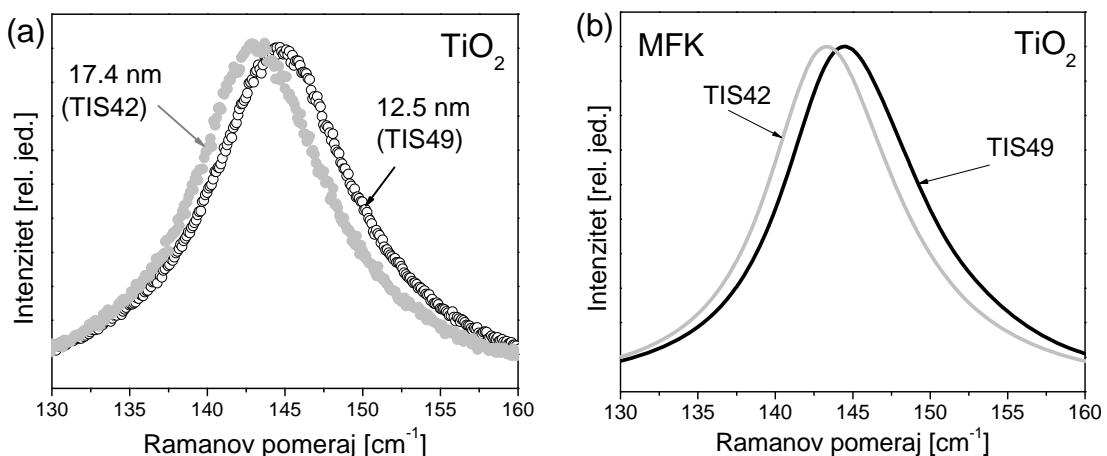
Sa Slike 2.23(a) vidi se da su doprinosi pojedinačnih disperzionih grana različiti po intenzitetu, položaju i obliku. Sa druge strane, ukupni doprinosi pojedinačnih simetrijskih pravaca imaju vrlo slično ponašanje u pogledu oblika i pozicije. Kako je E_g ramanski mod anatas TiO₂ računat po celoj BZ, proporcionalan *zbiru* doprinosa duž pojedinih simetrijskih pravaca, to će se njegov položaj i oblik malo razlikovati od položaja i oblika moda, koji bi se dobio integracijom po samo jednom od ovih pravaca (npr. Γ -X). To je verovatno glavni razlog zbog koga su rezultati različitih autora, dobijeni primenom MFO uz pretpostavku sferne i izotropne BZ, dali relativno dobra slaganja sa eksperimentalnim spektrima anatas TiO₂ nanokristala [90-92, 97, 113, 114].

Svi rezultati, koji će biti prikazani u narednim poglavljima, zasnivaju se na ovde izloženom modelu neizotropne BZ, gde su uzeti u obzir doprinosi sva tri simetrijska pravca BZ, dok su disperzione grane modelovane kosinusnim funkcijama, čiji parametri su prikazani u Tabeli 2.5.

2.4.1.2. Uticaj dimenzije nanočestice na ramanski E_g mod anatas TiO₂ nanopraha

Ponašanje najintenzivnijeg ramanskog E_g moda kod anatas TiO₂ nanoprahova sa različitim dimenzijama nanočestice, obrađeno je na primeru uzoraka TIS42 i TIS49, čiji su modovi prikazani na Slici 2.24(a). Uticaj smanjivanja dimenzije nanočestice ogleda

se kroz veće pomeranje E_g moda i asimetrično širenje ka višim učestanostima, koje se javlja kod nanopraha sa manjim nanočesticama (TIS49 sa $\langle d \rangle_{XRD}=12.5$ nm), u odnosu na nanoprah sa krupnijom nanočesticom (TIS42 sa $\langle d \rangle_{XRD}=17.4$ nm). Na Slici 2.24(b) prikazani su rezultati modelovanja ovih spektara primenom MFO. Za centralne veličine nanočestica ovih uzoraka uzete su vrednosti dobijene na osnovu XRD rezultata, sa asimetričnim Gauss-ovim distribucijom nanočestica i to: $w_L=0.25L_0$ i $w_D=0.60L_0$ ($A_G=-0.41$) za TIS49, odnosno $w_L=0.45L_0$ i $w_D=0.55L_0$ ($A_G=-0.1$) za TIS42. Prirodna širina ramanskog moda je $\Gamma=8.5$ cm $^{-1}$, a disperzije relacije uzete su u kosinusnom obliku (Slika 2.22, odnosno Tabela 2.5), sa $\omega_{q=0}=142$ cm $^{-1}$, pri čemu je integracija vršena po svim pravcima visoke simetrije u BZ (videti prethodno poglavlje). Sa Slike 2.24. može se zaključiti da MFO sa asimetričnom Gauss-ovom distribucijom dimenzija nanočestica dobro opisuje uticaj smanjivanja nanočestice na položaj i širinu ramanskog moda.



Slika 2.24. Eksperimentalni spektri E_g ramanskog moda (a) i rezultati MFO sa asimetričnom Gaussovom distribucijom nanočestice (b) za uzorke TIS49 i TIS42 anatas TiO_2 nanopraha.

2.4.1.3. Uticaj naprezanja na ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha

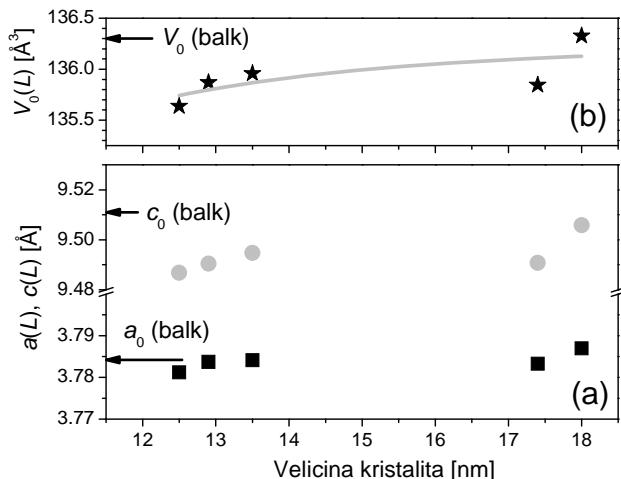
Ustanovljeno je da je ponašanje zapremine jedinične celije anatas TiO_2 nanokristala u odnosu na kristal direktno zavisno od načina sinteze uzorka [104], pa su i podaci o ponašanju kristalne rešetke anatas TiO_2 sa smanjivanjem dimenzije nanokristala u izvesnoj meri kontradiktorni. Li [108] i Swamy [104] sa saradnicima daju

podatke o nelinearnom smanjivanju jedinične čelije anatas TiO_2 sa smanjivanjem dimenzije nanokristalita²⁷. Slični rezultati dobijeni su i u ovom radu i njihov uticaj na ramanske spektre i njihovo modelovanje biće izložen u tekstu koji sledi.

Iz XRD merenja ustanovljeno je da se parametri tetragonalne kristalne rešetke anatas TiO_2 nanoprahova smanjuju sa smanjivanjem dimenzije kristalita. Na Slici 2.25(a) predstavljene su zavisnosti parametara kristalne rešetke $a(L)$ i $c(L)$, dobijene iz XRD merenja, od dimenzije nanokristalita za različite anatas TiO_2 nanoprahove, koji su ovde ispitivani. Na Slici 2.25(b) prikazana je i zavisnost zapremine jedinične čelije $V(L)$ od dimenzije nanočestice, koja se može aproksimirati relacijom:

$$V(L) = V_0 - k_1 / L^{k_2}, \quad (2.42)$$

gde V_0 odgovara zapremini tetragonalne jedinične čelije u kristalnom materijalu ($V_0 = a_0^2 c_0 = 136.28 \text{ \AA}^3$) 136.24 , dok su k_1 i k_2 parametri koji se mogu podešavati [119].



Slika 2.25. Prikaz promene parametara kristalne rešetke (a) i zapremine jedinične čelije (b) anatas TiO_2 nanopraha sa promenom dimenzije kristalita (XRD); označene vrednosti parametara rešetke za anatas TiO_2 u kristalu iznose $a_0=3.784 \text{ \AA}$, $c_0=9.515 \text{ \AA}$ [9].

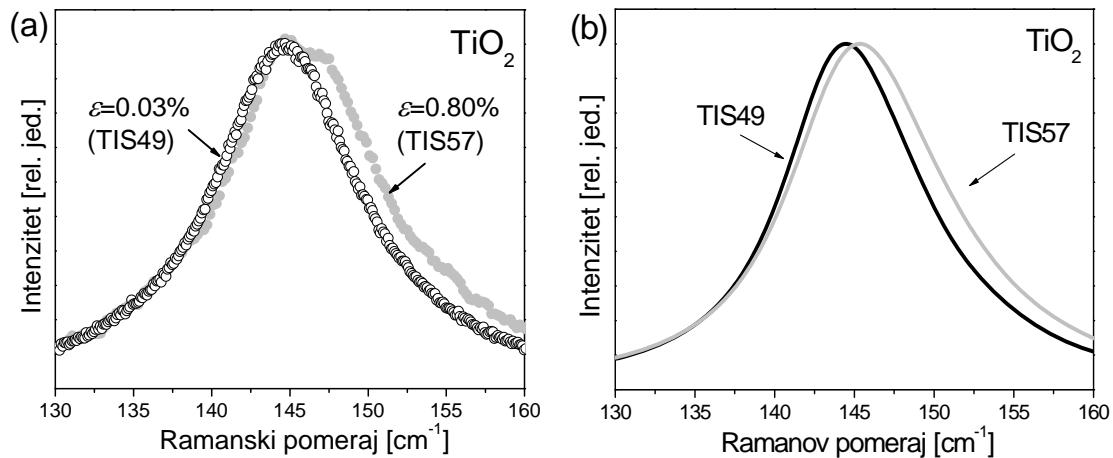
Promena parametra rešetke sa smanjivanjem dimenzije nanočestice utiče na položaj ramanskog E_g moda pojavom nehomogenog naprezanja, na način opisan u Poglavlju 2.3.1.4. S obzirom da se radi o tetragonalnoj rešetki, promena učestanosti ramanskog moda, koja odgovara naprezanju kristalne rešetke, povezana je sa smanjivanjem zapremine jedinične čelije (preko ranije date relacije (2.30)). Uticaj kontrakcije jedinične čelije, odnosno naprezanja na sabijanje, s obzirom na pozitivnu vrednost Grüneisen-ovog parametra za E_g , prouzrokuje pozitivno pomeranje moda kod

²⁷ Ovakvo ponašanje je suprotno ponašanju rutilne faze, kod koje dolazi do linearne širenja kristalne rešetke sa smanjivanjem nanočestice. Nelinearna kontrakcija kristalne rešetke, koja se javlja kod anatas TiO_2 je inače karakteristična za metalne nanočestice [104].

anatas TiO_2 nanopraha. To se u ovom slučaju poklapa sa uticajem smanjivanja veličine nanočestice - mod se pomera i širi ka višim učestanostima.

Na Slici 2.26(a) prikazani su eksperimentalni spektri ramanskog E_g moda uzoraka TIS49 (sa $\langle d \rangle_{\text{XRD}} = 12.5$ nm i praktično zanemarljivom vrednošću naprezanja $\varepsilon = 0.03\%$) i TIS57 ($\langle d \rangle_{\text{XRD}} = 13.7$ nm, sa velikom vrednošću naprezanja od $\varepsilon = 0.80\%$). Može se uočiti da kod uzorka sa velikim naprezanjem (TIS57) dolazi do većeg pomeranja i asimetričnog širenja ovog moda, iako je u pitanju uzorak sa većom dimenzijom nanočestice. Rezultati primene MFO sa efektom nehomogenog naprezanja, prikazani na Slici 2.26(b), pokazuju dobro slaganje između merenih i računatih spektara za navedene uzorke.

Za uzorak TIS49 korišćeni su isti parametri kao na Slici 2.24(b), dok je kod TIS57 za dimenziju nanočestice uzeta vrednost dobijena XRD merenjem, $L_0 = 13.7$ nm, sa asimetričnom Gauss-ovom distribucijom ($w_L = 0.30L_0$, $w_D = 0.70L_0$, $A_G = -0.40$). Nehomogeno naprezanje je uračunato primenom relacije (2.30), a Grüneisen-ov parametar kod anatas TiO_2 ima vrednost $\gamma_i = 4.23$ [114]. Prirodna širina ramanskog moda je $\Gamma = 9 \text{ cm}^{-1}$, a disperzije relacije su uzete u kosinusnom obliku, sa $\omega_{q=0} = 142 \text{ cm}^{-1}$, pri čemu je integracija takođe vršena po svim pravcima visoke simetrije u BZ.

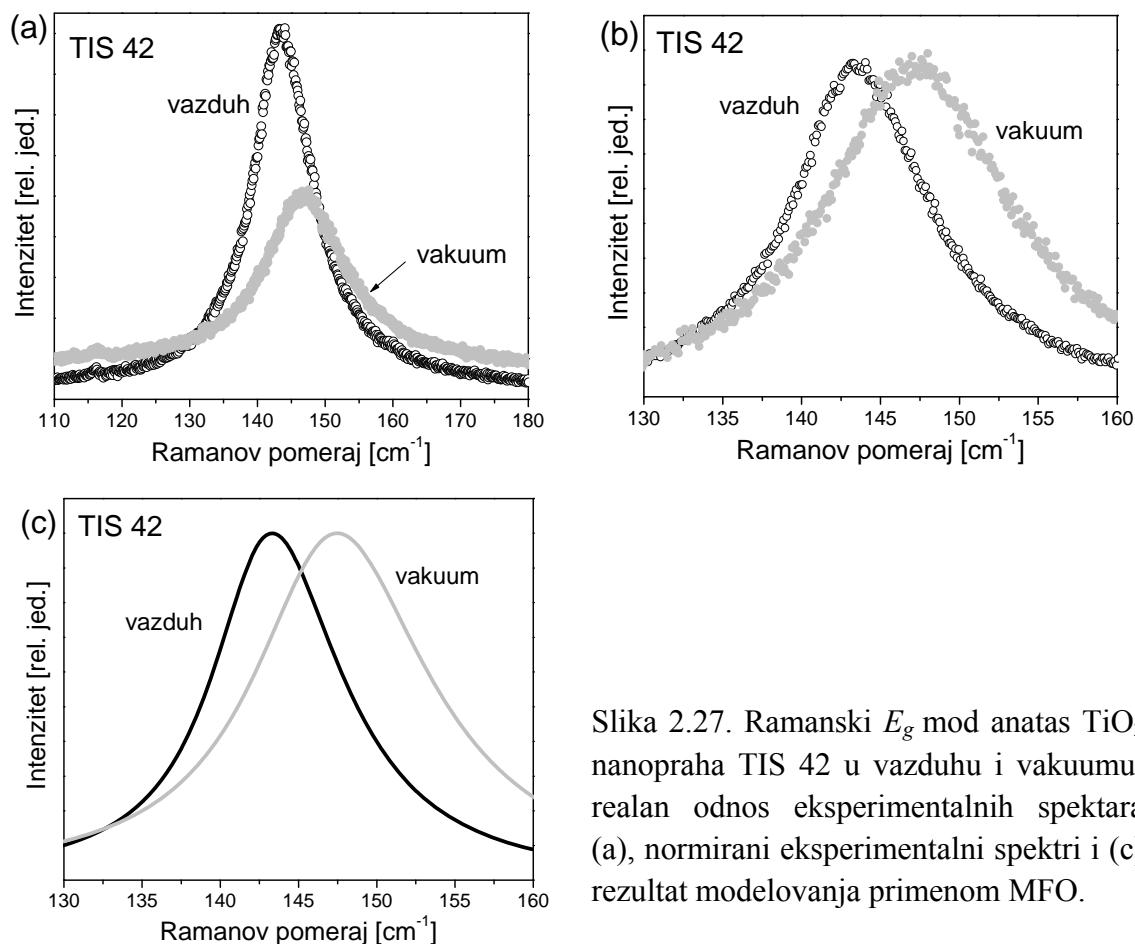


Slika 2.26. Eksperimentalni spektri E_g ramanskog moda (a) i rezultati MFO sa asimetričnom Gaussovom distribucijom nanočestice (b) za uzorke TIS49 i TIS57 anatas TiO_2 nanoprahova.

2.4.1.4. Uticaj nestehiometrije na ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha

Na smanjivanje odnosa O/Ti, odnosno pojavu nestehiometrije u anatas TiO_2 , kao dominantan faktor, koji utiče na pomeranje i širenje ramanskog E_g moda ka višim učestanostima, ukazuju Parker i Siegel (ref. [117]) i Bassi sa saradnicima (ref. [90]).

Ovde je istraživan uticaj nestehiometrije izazvane laserskim ozračivanjem anatas TiO_2 nanopraha u vakuumu. Lasersko ozračivanje anatas TiO_2 nanopraha praćeno je promenom boje uzorka, koja se povezuje sa promenom stehiometrije [120]. Na Slici 2.27(a) prikazan je ramanski E_g mod uzorka nanopraha TIS42 meren u vazduhu i u vakuumu. Može se uočiti da u spektru snimljenom u vakuumu dolazi do snižavanja intenziteta ramanskog E_g moda, istovremeno sa pomeranjem i širenjem u odnosu na isti mod meren u vazduhu.



Slika 2.27. Ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha TIS 42 u vazduhu i vakuumu: realan odnos eksperimentalnih spektara (a), normirani eksperimentalni spektari i (c) rezultat modelovanja primenom MFO.

Na Slici 2.27(b) ovi spektri su normirani, radi boljeg poređenja sa spektrima modelovanim pomoću MFO, koji su prikazani na Slici 2.27(c). Uticaj nestehiometrije na promene ramanskog E_g moda uveden je preko dodatnog pomeranja i širenja moda, koje se odražava na veće polazne vrednosti $\omega_{q=0}$ i Γ u MFO. Ovi parametri za E_g mod u vakuumu iznose $\omega(q=0)=146 \text{ cm}^{-1}$ i $\Gamma=12 \text{ cm}^{-1}$, što je za 4 cm^{-1} , odnosno 3.5 cm^{-1} , veće od odgovarajućih vrednosti za ovaj mod u vazduhu. Ovakve promene položaja i širine u odnosu na stehiometrijski uzorak ($\text{O}/\text{Ti}=2$) bi, prema rezultatima koje su dali Parker i Siegel [117], odgovarale pojavi nestehiometrije pri kojoj je odnos $\text{O}/\text{Ti}=1.99$.

Razdvajanje uticaja nestehiometrije od ostalih faktora (veličine nanočestice, njene distribucije, naprezanja), koji deluju na ramanski E_g mod, sprovedeno primenom MFO, otvara mogućnost da se na osnovu ramanskih spektara izvrši procena nestehiometrije kod anatas TiO_2 nanoprahova²⁸.

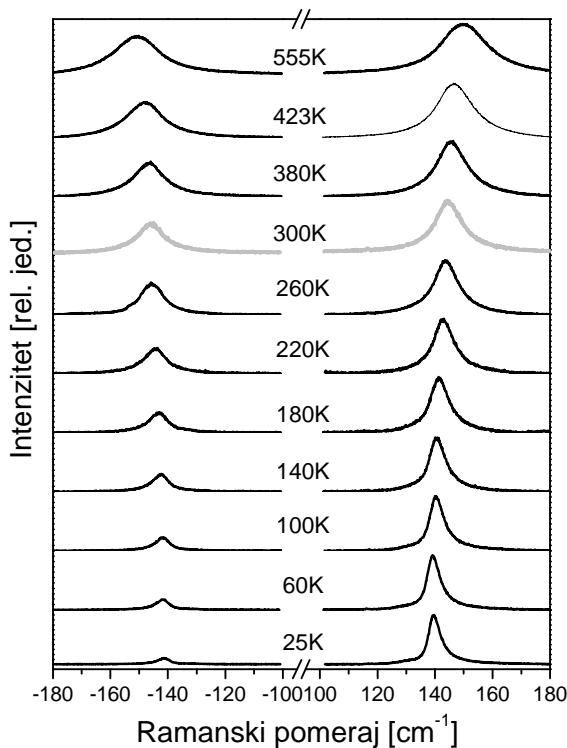
2.4.1.5. Anharmonijski efekat u anatas TiO_2 nanoprahu

Mada je anharmonijski efekat široko izučavana oblast kod kristala, posebno kod poluprovodnika, rezultati kod anatas TiO_2 nanoprahova su još uvek dosta retki. Zhu sa saradnicima [92] je prvi prikazao ramanske spektre anatas TiO_2 nanokristala u temperaturskom opsegu 83–293 K i razmatrao zavisnost položaja i oblika najintenzivnijeg ramanskog E_g moda, na $\sim 144 \text{ cm}^{-1}$. Pri tome je MFO primjenjen samo na spektre nanopraha na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od dimenzije nanočestica. Korišćen je uprošćen MFO, uz prepostavku izotropne BZ i bez direktnog poređenja eksperimentalnog i modelovanog spektra. Hearne i saradnici [101] izučavali su stabilnost kristalnog i nanokristalnog anatas TiO_2 sa prosečnom veličinom nanočestica 12 nm u zavisnosti od temperature i pritiska. Za razliku od uobičajenog pomeranja i širenja najintenzivnijeg ramanskog E_g moda u kristalu sa povećanjem temperature, ovi autori su kod nanomaterijala uočili da pomeraj i porast poluširine na visokim temperaturama ($>800 \text{ K}$) ulaze u zasićenje. Ovo se pripisuje povećanju dimenzije nanočestice usled zagrevanja nanomaterijala. Detaljniji prikaz uticaja anharmonijskog

²⁸ Napomena: treba imati u vidu da se lasersko zagrevanje u vakuumu ne odražava na isti način na ramanske spektre svih uzoraka koji su ispitivani u ovom radu [121].

efekta i na ostale mode ramanskog spektra anatas TiO_2 nanokristala dali su Du i saradnici [122].

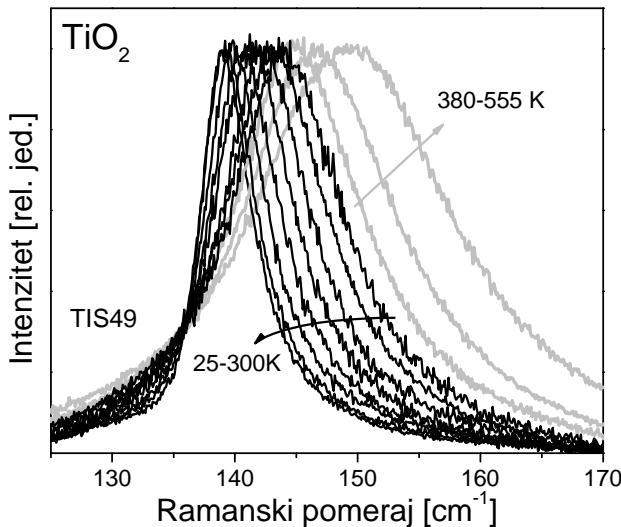
U ovom poglavlju će biti detaljno razmotreno ponašanje najintenzivnijeg ramanskog E_g moda pri hladjenju i zagrevanju nanokristalnog anatas TiO_2 nanopraha TIS49.



Slika 2.28. Stoksove i anti-Stoksove komponente ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha TIS49 merene u temperaturskom opsegu 25-555K. Stoksove komponente su normirane na 1.

Stoksova i anti-Stoksova komponenta ramanskog spektra na različitim temperaturama, u opsegu od 25 do 550 K prikazane su na Slici 2.26. Niže temperature ($T < 300$ K) realizovane su u kriostatu u vakuumu (videti konfiguraciju ramanskog eksperimenta, Poglavlje 2.2.). Više temperature dobijene su lokalnim zagrevanjem uzorka fokusiranim laserskim snopom izlazne snage od 100 do 700 mW. Ove temperature su određene računski, na uobičajeni način iz odnosa Stoksove i anti-Stoksove komponente, prema jednačini (2.16) datoј u Poglavlju 2.1.2.2. Kao što je očekivano, anti-Stokes-ove komponente ramanskog spektra na niskim temperaturama imaju mali intenzitet u poređenju sa Stokes-ovim, dok se sa povećavanjem temperature

ove dve komponente praktično približavaju po intenzitetu, što se može videti i sa Slike 2.28.



Slika 2.29. Pregled temperaturske zavisnosti Stoksovih komponenti ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha TIS49 na temperaturama 25-555 K.

Na Slici 2.29. posebno je prikazana Stokes-ova komponenta ramanskog E_g moda na različitim temperaturama od 25 do 555 K, gde veliko pomeranje i širenje ramanskog E_g moda sa porastom temperature ukazuju na veliki anharmonijski uticaj. Za analizu ovih spektara biće primenjen MFO sa uračunatim anharmonijskim efektom.

Kao što je opisano u prethodnim poglavljima, u proračunu ramanskog E_g moda anatas TiO_2 nanopraha TIS49, polazi se od pretpostavke da je srednja vrednost dimenzije kristalita u nanoprahu $L_0=12.5$ nm (u skladu sa rezultatima XRD), dok je raspodela dimenzija čestica procenjena kao asimetrična Gauss-ova, sa faktorom asimetrije $A_G=-0.41$, odnosno širinama $w_L=0.25L_0$ i $w_D=0.60L_0$ (na osnovu SEM rezultata). Vrednost naprezanja dobijena iz XRD merenja je relativno mala ($\varepsilon\sim 0.03\%$), zbog čega je uticaj unutrašnjeg naprezanja na karakteristike E_g moda zanemaren u proračunima koji slede.

Kao što je u Poglavlju 2.4.1.4. rečeno, nestehiometrija, koja nastaje usled ozračivanja laserom u vakuumu, takođe može da dovede do značajnog pomeranja i širenja ramanskih modova [90, 117, 119]. Međutim, ustanovljeno je da su ovi efekti u uzorku TIS49 veoma mali (položaj i širina moda merenog u vazduhu i vakuumu razlikuju se za manje od 1 cm^{-1}). Izgleda da prisustvo nestehiometrijskih defekata u

ovom uzorku pre izaziva pojavu novog moda, koji se na sobnoj temperaturi nalazi na $\sim 137 \text{ cm}^{-1}$, kao što je ukazano na Slici 2.30. Ovaj mod niskog intenziteta najverovatnije ukazuje na prisustvo male količine Ti nanočestica [40], što je u skladu (ili bar nije u suprotnosti) sa XRD rezultatima. Naime, u XRD spektru ovog uzorka, pojavljuje se mali pik na oko $2\theta=29^\circ$, koji se inače registruje u Ti filmovima nanometarske debljine [123], dok se glavni difrakcioni pik (002) čistog titanijuma na $2\theta=38^\circ$ poklapa sa pikom (004) anatas TiO_2 (videti Poglavlje 1.1.3.2.), te ni ne bi mogao doći do izražaja u XRD spektrima anatas TiO_2 .

Treba napomenuti da usled lokalnog zagrevanja nanoprahova, izazvanog laserskim ozračivanjem, može doći do porasta veličine nanočestica, što sa svoje strane može uticati do pomeranje i promenu oblika ramanskih modova. Međutim, pri odgrevanju anatas TiO_2 nanoprahova na temperaturama nižim od 673 K nije registrovana promena dimenzije nanočestice [124]. Efekat ukrupnjavanja nanočestica pri lokalnom zagrevanju usled laserskog ozračivanja anatas TiO_2 nanopraha zabeležen je tek na temperaturama većim od 673 K [112]. Kako su u ovom istraživanju najviše temperature postignute tokom laserskog zagrevanja procenjene na oko 555 K, može se smatrati da nije došlo do povećanja dimenzije nanočestice u posmatranom uzorku anatas TiO_2 nanopraha. U prilog ovoj tvrdnji govori činjenica da ramanski spektar posmatranog uzorka (TIS49) na sobnoj temperaturi pre i posle zagrevanja do 555 K ima iste karakteristike (položaj i širina).

Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da su uticaji naprezanja i nestehiometrije zanemarljivi i da u navedenim uslovima ne dolazi ni do ukrupnjavanja nanočestica, tako da se fononsko ograničenje i anharmonijski efekti mogu smatrati dominantnim razlozima za pomeraj i širenje ramanskog E_g moda u ovom uzorku. Jasno je da asimetričan oblik ovog moda na niskim temperaturama potiče od fononskog ograničenja, dok je simetričan oblik na visokim temperaturama posledica velikog anharmonijskog uticaja. Zato postoji potreba da se doprinosi fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta preciznije analiziraju i procene nezavisno jedan od drugog.

U tom cilju ramanski E_g mod anatas TiO_2 nanopraha modeliran je primenom MFO (2.41) sa uključenim uticajem distribucije dimenzija nanočestica i temperaturskom zavisnošću učestanosti moda $\omega_{q=0}(T)$ u centru BZ i širine moda $I(T)$, čije vrednosti su prikazane su u Tabeli 2.6. Vrednost faktora ograničenja procenjena je

kao $\beta \approx 16$. Disperzije relacije uzete su u kosinusnom obliku, kao i u prethodnim poglavljima, pri čemu je integracija vršena po svim pravcima visoke simetrije u BZ (videti Poglavlje 2.3.1.2). Eksperimentalni ramanski spektar na različitim temperaturama modelovan je sumom ramanskog E_g moda, dobijenog primenom MFO na gore opisan način, i dodatnog moda usled nestehiometrijskih defekata, koji je modelovan lorencijanom. Parametri lorencijana (položaj ω_{Ti} , širina w_{Ti} i relativni intenzitet) u zavisnosti od temperature prikazani su u Tabeli 2.7. Poređenje eksperimentalnih i modelovanih spektara prikazano je na Slici 2.30.

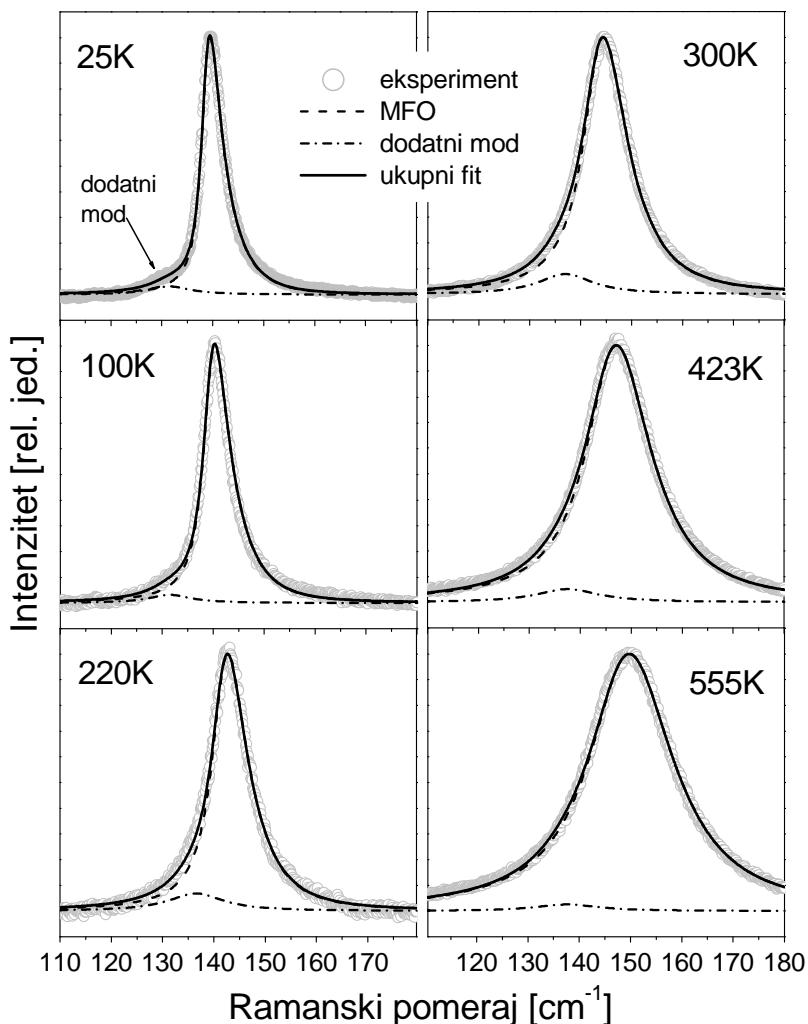
Tabela 2.6. Temperaturska zavisnost parametara MFO $\omega_{q=0}(T)$ i $I(T)$ koje se koriste u modelovanju ramanskog E_g moda, kao i temperaturska zavisnost položaja (ω_{Ti}), širine (w_{Ti}) i relativnog intenziteta dodatnog ramanskog moda u spektru anatas TiO_2 koji se pripisuje čistom titaniju. Sve vrednosti date su u cm^{-1} , osim intenziteta u relativnim jedinicama.

T [K]	Ramanski E_g mod		Dodatni mod		
	$\omega_{q=0}(T)$	$I(T)$	ω_{Ti}	w_{Ti}	Intenzitet
25	138.3	3.0	131.5	10	0.5
60	138.5	3.5	131.5	10	0.5
100	139.0	4.3	131.5	10	0.5
140	139.5	5.0	132.5	10	0.7
180	140.2	5.5	134.5	11	0.9
220	141.2	6.3	136.5	13	1.4
260	142.0	7.6	136.5	13	2.0
300	142.8	8.5	136.5	13	1.6
380 *	144.1	11.5	137.5	13	1.5
423 *	145.2	13.5	137.5	15	1.0
555 *	147.7	18.0	137.5	15	0.6

* Temperature su računate iz odnosa Stoksa i anti-Stoksa, prema jednačini (2.16).

Promena intenziteta dodatnog ramanskog moda sa temperaturom potvrđuje činjenicu da je ovaj mod povezan sa količinom nestehiometrijskih defekata u uzorku. Naime, opadanje njegovog intenziteta sa povećanjem temperature tokom procesa zagrevanja uzorka u vazduhu, može se objasniti činjenicom da se količina nestehiometrijskih defekata smanjuje sa dužinom laserskog ozračivanja velike snage u vazduhu. S druge strane, maksimalan relativni intenzitet ovog moda, registrovan na temperaturi od 260 K,

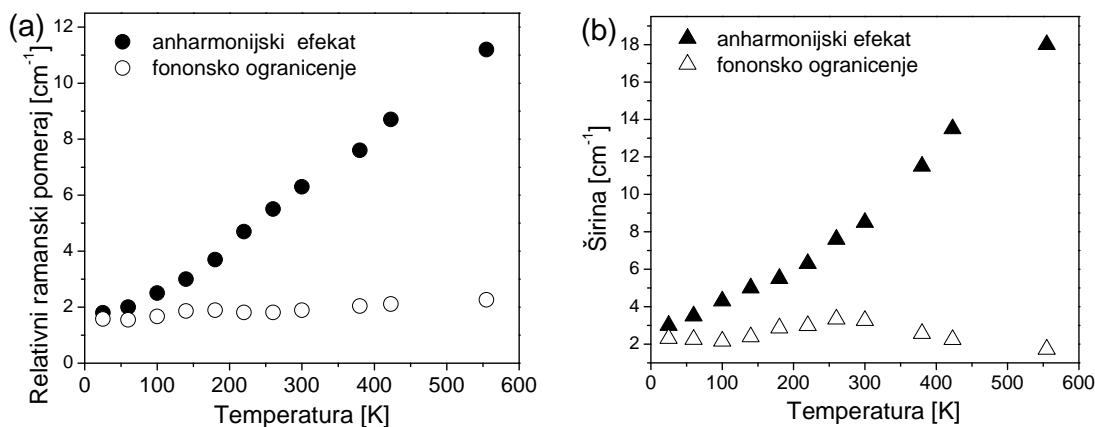
očekivan je kao posledica pojave najvećeg broja nestehiometrijskih defekata na početku procesa hlađenja uzorka u vakuumu.



Slika 2.30. Eksperimentalni ramanski spektri anatas TiO_2 nanopraha TIS49 na različitim temperaturama, modelovani kao suma E_g moda dobijenog primenom MFO sa uračunatim anharmonijskim efektom i dodatnog moda usled nestehiometrijskih defekata modelovanog lorencijanom.

Kao što je ranije rečeno, značajno pomeranje i širenje, kao i simetričan oblik ramanskog E_g moda na višim temperaturama, rezultati su izraženog anharmonijskog efekta. Na Slici 2.31 prikazani su odvojeno doprinosi fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta pomeraju ramanskog E_g moda i promeni širine u zavisnosti od temperature. Pri tome je relativni ramanski pomeraj računat u odnosu na položaj E_g moda u anatas TiO_2 monokristalu na 0 K preuzet iz literature [92]. Kao što je očekivano, doprinosi usled fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta uporedivi su

na niskim temperaturama. Doprinos anharmonijskog efekta²⁹, koji raste sa temperaturom, na visokim temperaturama daleko prevazilazi uticaj fononskog ograničenja. Osim toga, pomeraj ka višim učestanostima, koji potiče od samog ograničenja ima slične vrednosti (oko 1.8 cm^{-1}) na svim posmatranim temperaturama (Slika 2.31(a)), dok se doprinos ograničenja asimetričnom širenju ramanskog E_g moda neznatno menja sa promenom temperature (Slika 2.31(b)). Najveće širenje ovog moda, koje potiče samo od fononskog ograničenja, događa se na temperaturi 260 K i ono može biti posledica pojave nestehiometrije u materijalu, usled ozračivanja laserom u vakuumu. Sa druge strane, ovo širenje je manje na višim temperaturama zbog uspostavljanja stehiometrije usled ozračivanja u vazduhu.



Slika 2.31. Doprinos fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta pomeranju (a) i promeni širine (b) ramanskog E_g moda na različitim temperaturama.

Na osnovu prikazanih rezultata, može se zaključiti da zanemarivanje anharmonijskog uticaja na E_g ramanski mod, čak i na sobnoj temperaturi, vodi ka velikom odstupanju rezultata MFO od eksperimentalnih i značajnih razlika u parametrima modela kod anatas TiO_2 nanoprahova, koje su prisutne u literaturi [89, 90, 92].

Doprinos trofononskih anharmonijskih procesa pomeranju i širini ramanskog E_g moda za različite veličine nanočestica kod anatas TiO_2 nanoprahova, na osnovu temperaturske zavisnosti ramanskih spektara, analizirali su Zhu i saradnici [92]. U

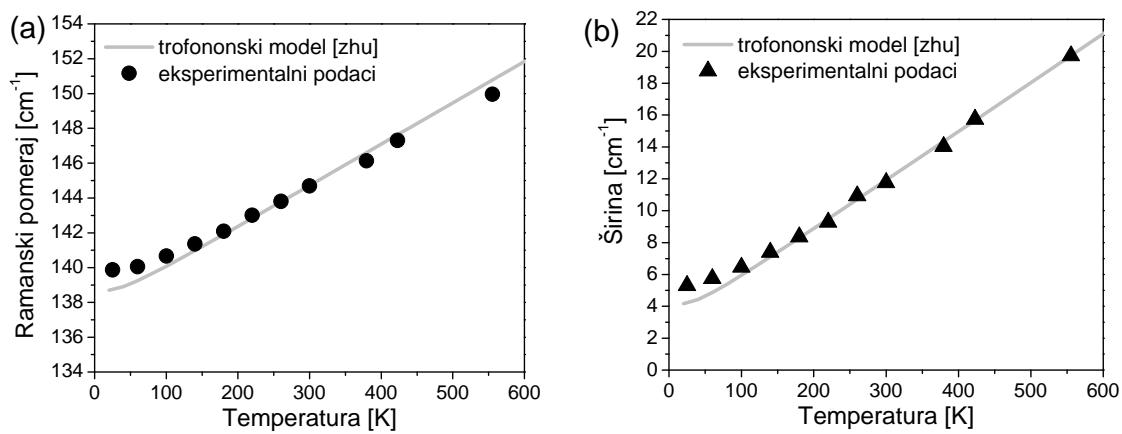
²⁹ Treba imati u vidu da relativno mali deo širenja ($\sim 1 \text{ cm}^{-1}$) pripisan anharmonijskom efektu može poticati od drugih tipova širenja koji ne zavise od temperaturski zavisne populacije fonona, kao npr. instrumentalno širenje moda i/ili neki drugi, unutrašnji uzroci [50].

skladu sa jednačinama (2.39), (2.40), (2.36) i (2.38), navedenim u Poglavlju 2.3.1.5, smatrajući da temperaturski nezavisni parametri ω_l i Γ_l obuhvataju i efekte fononskog ograničenja. Oni su pokazali da se sparivanje fonona pojačava u anatas TiO_2 nanokristalima u poređenju sa odgovarajućim kristalom i dali parametre trofononskog procesa za pojedine veličine nanočestice. Na Slici 2.32, položaji i širine ramanskog E_g moda, direktno očitani sa eksperimentalnih spektara za uzorak TIS49, upoređeni sa odgovarajućim podacima dobijenim primenom anharmonijskog modela, uzimajući u obzir samo trofononske procese [50, 92]. Vrednosti anharmonijskih parametara, koje odgovaraju nanoprahu sa veličinom čestice 12.7 nm, preuzete su iz ref. [92]: $\omega_l=137.5 \text{ cm}^{-1}$, $A_1=1.18 \text{ cm}^{-1}$, $A_2=0$, $\Gamma_l=2.62 \text{ cm}^{-1}$, $B_1=1.52 \text{ cm}^{-1}$ i $B_2=0$, pri čemu oznake parametara odgovaraju anharmonijskim popravkama odgovaraju gore navedenim jednačinama. Dobro slaganje eksperimentalnih i računatih podataka na Slici 2.32 dobijeno je u temperaturskom opsegu od 150 do 300 K, dok izvan ovog opsega postoji izvesno odstupanje, koje se može pripisati kako uticaju fononskog ograničenja, tako i uticaju četvorofononskih procesa.

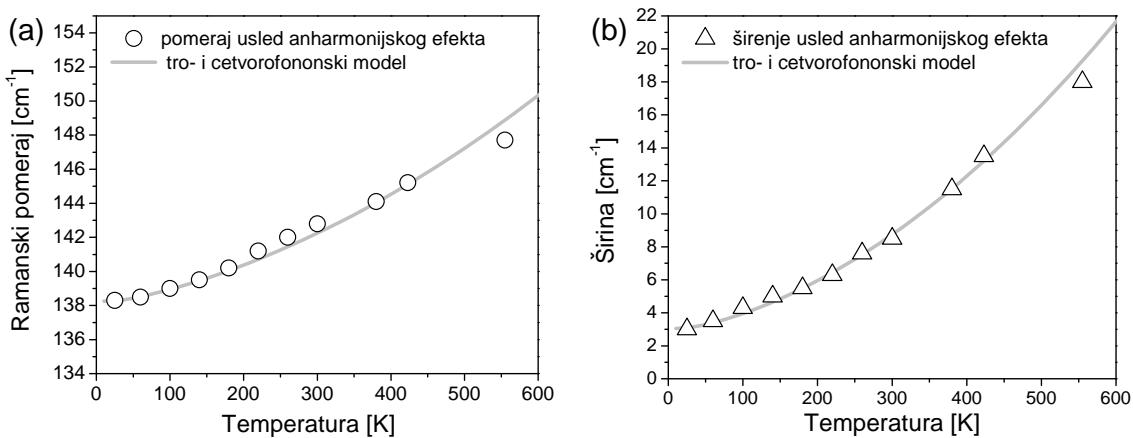
Popović i saradnici [125] su pri modelovanju anharmonijskog efekta kod polikristalnog anatas TiO_2 i komercijalnog anatas nanopraha dimenzije nanočestice oko 5 nm, dobili dobro slaganje teorijske krive sa eksperimentalno dobijenom temperaturskom zavisnošću učestanosti ramanskog E_g moda, tako što su, pored trofononskog, uzeli u obzir i četvorofononski proces. Pri tome su zaključili da su anharmonijski parametri A_1 i A_2 prema jednačinama (2.34) i (2.36), kao i odnos A_2/A_1 , veći u nanokristalnom nego u polikristalnom TiO_2 , što pokazuje da je uticaj četvorofononskog procesa izraženiji u nanokristalnoj fazi.

Na Slici 2.33. prikazan doprinos anharmonijskog efekta pomeranju i širenju ramanskog E_g moda, bez doprinosa fononskog ograničenja. U modelovanje ovog efekta, pored trofononskog, morao je biti uključen i četvorofononski proces, prema jednačinama (2.34, 2.36-38). Parametri koji su korišćeni u ovom proračunu su: $\omega_0=137.8 \text{ cm}^{-1}$, $A_1=0.42 \text{ cm}^{-1}$, $A_2=0.03 \text{ cm}^{-1}$, $\Gamma_0=2.55 \text{ cm}^{-1}$, $B_1=0.45 \text{ cm}^{-1}$ i $B_2=0.055 \text{ cm}^{-1}$, pri čemu ne treba izgubiti iz vida da parametri ω_0 i Γ_0 ne obuhvataju efekte fononskog ograničenja.

Ova analiza, izvedena uz pomoć MFO, pokazuje da, za razliku od anharmonijskog efekta u anatas TiO_2 monokristalu, gde je zavisnost pomeranja i širenja ramanskog E_g moda gotovo linearna [92] i može biti modelovana samo trofononskim procesima, kod anatas TiO_2 nanoprahova moraju biti uzeti u obzir i četvorofononski procesi, kako bi se dobilo bolje slaganje između eksperimentalnih i modelovanih rezultata u širem temperaturskom opsegu. Uticaj četvorofononskog procesa, koji se procenjuje na osnovu odnosa anharmonijskih parametara četvorofononskog i trofononskog procesa [82], u slučaju nanopraha TIS49 je ipak relativno mali ($A_2/A_1=0.071$ i $B_2/B_1=0.122$).



Slika 2.32. Eksperimentalna zavisnost položaja (a) i širine (b) ramanskog E_g moda na različitim temperaturama u poređenju sa odgovarajućim podacima računatim primenom trofononske popravke anharmonijskog efekta [92].



Slika 2.33. Eksperimentalna zavisnost pomeraja (a) i širine (b) ramanskog E_g moda usled anharmonijskog efekta na različitim temperaturama u poređenju sa odgovarajućim podacima računatim primenom trofononske i četvorofononske popravke.

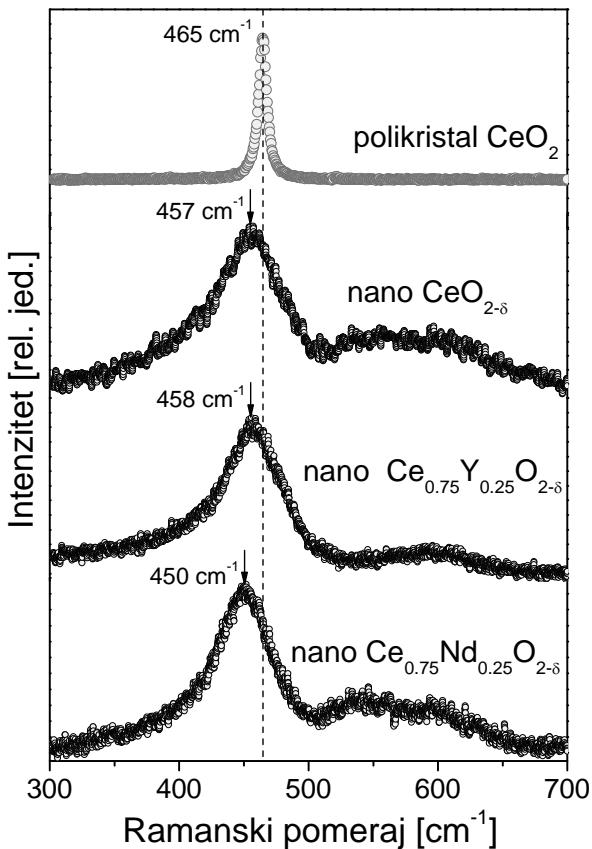
2.5. Ramanski spektri CeO_2 i $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova

Ramanska merenja čistog i dopiranog cerijum dioksida izvedena su u geometriji unazad, pomoću plave linije Ar^+ lasera talasne dužine 488 nm. Korišćeni su Jobin-Yvon U1000 dvostruki monohromator i fotomultiplikator kao detektor (videti Poglavlje 2.2). Da bi se izbeglo zagrevanje uzorka, korišćen je cilindrični fokus, sa izlaznom snagom laserskog zračenja manjom od 100 mW. Dobijeni eksperimentalni spektri CeO_2 polikristala i $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha, kao i dopiranih $\text{Ce}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ i $\text{Ce}_{0.75}\text{Nd}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova prikazani su na Slici 2.34.

Monokristal CeO_2 ima trostruko degenerisani Raman aktivni mod simetričnog oblika, na $\sim 465 \text{ cm}^{-1}$, širine $9\text{-}10 \text{ cm}^{-1}$, koji se manifestuje kao simetrična dišuća vibracija, u kojoj se kreću samo kiseonikovi joni, koji okružuju Ce^{4+} katjon [56, 67]. U nanokristalnom $\text{CeO}_{2-\delta}$ ovaj mod je registrovan na 457 cm^{-1} , uz znatno veći pomeraj ka nižim učestanostima (crveni pomeraj), nego što pokazuju drugi autori [105, 126]. Širina ovog moda iznosi oko 57 cm^{-1} uz izraženu asimetriju ka nižim učestanostima. Slično ponašanje ovaj mod pokazuje i kod dopiranih uzoraka.

Nekoliko faktora, kao što su fononsko ograničenje, naprezanje, nehomogena distribucija čestice, defekti i nestehiometrija doprinose promeni položaja i širine ramanskog F_{2g} moda kod čistog i dopiranih $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanoprahova. Imajući to u vidu, detaljna analiza ponašanja ovog moda primenom MFO biće prikazana u sledećem poglavlju.

Pored F_{2g} moda, u prikazanim ramanskim spektrima CeO_2 nanoprahova registrovana je i pojava dodatnih modova, na $\sim 599 \text{ cm}^{-1}$ u čistom CeO_2 i na ~ 556 i 600 cm^{-1} u $\text{Ce}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ odnosno ~ 540 i 599 cm^{-1} u $\text{Ce}_{0.75}\text{Nd}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahu. Prisustvo ovih modova posledica je pojave kiseoničnih vakancija, koje potiču od nestehiometrije i dopiranja. Njihovo ponašanje u zavisnosti od dopiranja takođe će biti razmatrano u poglavljima koja slede.

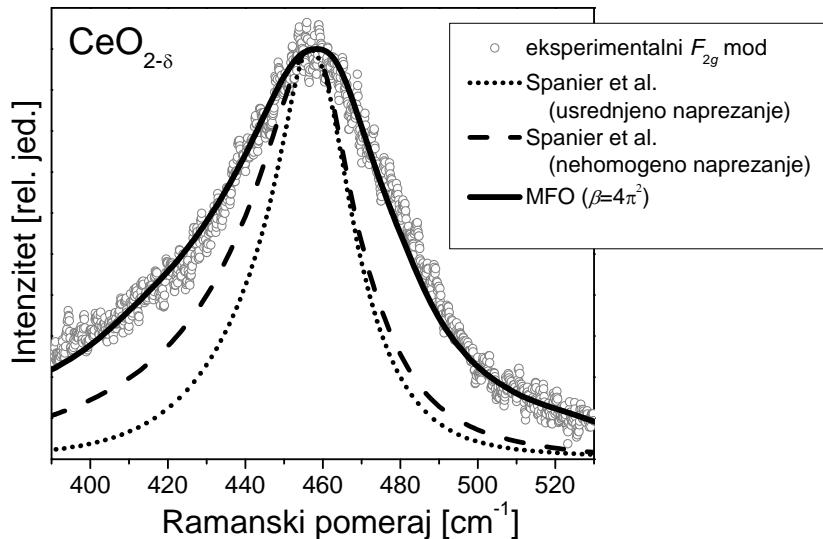


Slika 2.34. Eksperimentalni ramanski spektri CeO_2 polikristala, $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha i dopiranih $\text{Ce}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ i $\text{Ce}_{0.75}\text{Nd}_{0.25}\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova.

2.5.1. Primena MFO na ramanski spektar CeO_2 nanopraha

Kod nanomaterijala se uticaj fonona izvan centra BZ na ramanski spektar povećava sa smanjivanjem dimenzije nanočestice i manifestuje kroz pomeranje i asimetrično širenje moda, što je detaljno analizirano kroz primenu fenomenološkog MFO u Poglavlju 2.3. Promena parametara kristalne rešetke sa veličinom nanočestice zahteva uvođenje nehomogenog naprezanja u MFO preko distribucije dimenzije nanočestice, kako je opisano u Poglavlju 2.3.1.4, što dodatno utiče na položaj i širinu modelovanog ramanskog spektra. Parametri rešetke $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha usled efekata mikronaprezanja veći su od odgovarajućih vrednosti u kristalu i njihova zavisnost od dimenzije nanočestice prikazana je na Slici 2.16 u Poglavlju 2.3.1.4 [50, 105]. Zbog toga, kod analize ramanskog F_{2g} moda kod CeO_2 nanopraha, jednostavan MFO, koji su

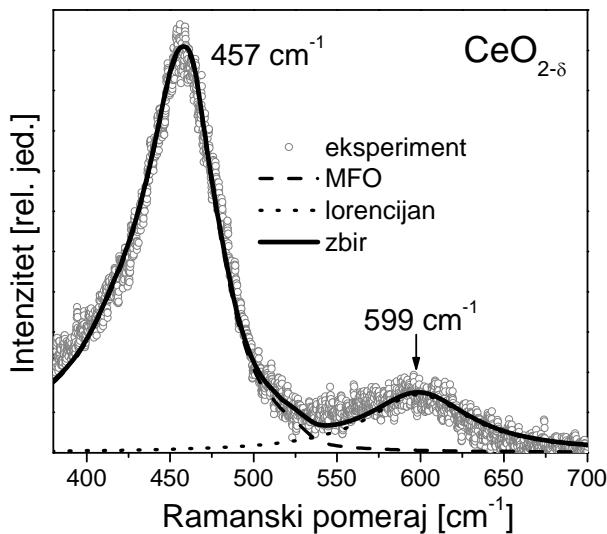
predložili Campbell i Fauchet [50], ne može dovoljno dobro da opiše eksperimentalne ramanske spektre dobijene kod CeO_2 nanoprahova (videti npr. Sliku 2.12(a)).



Slika 2.35. Eksperimentalni ramanski F_{2g} mod $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha sa rezultatima dobijenih primenom Spanier-ovog [50] modela, kao i MFO sa nehomogenim unutrašnjim naprezanjem.

Prema Spanieru i saradnicima [50] naprezanje unutar svake nanočestice smatra se uniformnim i uvodi se u MFO na već opisan način, preko jednačina (2.31) i (2.32). Na Slici 2.35. prikazani su rezultati ovako definisanog MFO, gde je ramanski F_{2g} mod modelovan primenom MFO na dva načina: uz pretpostavku uniformne distribucije nanočestice - odnosno usrednjjenog naprezanja (Slika 2.18(a)), kao i uvodeći u MFO Gauss-ovu distribuciju dimenzija nanočestica, tj. nehomogeno naprezanje u metarijalu (2.18(b)). Međutim, bez obzira na ova poboljšanja, direktna primena Spanier-ovog modela ne daje dovoljno dobro slaganje sa eksperimentalnim spektrom CeO_2 nanoprahova, kako je prikazano na Slici 2.35. Naime, iako je za srednju veličinu čestice $L_0=7 \text{ nm}$ postignuto dobro slaganje između eksperimentalnog i modelovanog spektra kada se radi o položaju moda, širina eksperimentalno dobijenog moda mnogo je veća od modelovane. Pre svega, pokazalo se da je jačina fononskog ograničenja $\beta=2\pi^2$, koje koriste Spanier i saradnici, neodgovarajuća. Dobro slaganje eksperimentalnog i modelovanog spektra ovog CeO_2 nanopraha dobija se primenom većeg faktora ograničenja $\beta=4\pi^2$ [93], kako je i prikazano na Slici 2.35. Pri tome je korišćena

simetrična Gauss-ova distribucija dimenzije nanočestice sa srednjom vrednošću $L_0=7$ nm, ali sa izmenjenom širinom $w=0.52L_0$. Fononske disperzije F_{2g} moda, $\omega_i(q)$, modelovane su polinomskim funkcijama petog reda, po pravcima Δ , Σ i Λ , uz pretpostavku sferne BZ, na način opisan u Poglavlju 2.3.1.2. Nehomogeno naprezanje modelovano je prema jednačinama (2.29) i (2.30) i odgovarajućim podacima datim u Poglavlju 2.3.1.4.



Slika 2.36. Eksperimentalni ramanski spektar $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha modelovan zbirom F_{2g} moda računatog pomoću MFO i dodatnog moda na $\sim 599 \text{ cm}^{-1}$ fitovanog lorencijanom.

Kao što smo već rekli, pored opisanog F_{2g} moda na 457 cm^{-1} , u ramanskom spektru čistog $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha javlja se i jedan dodatni mod na oko 599 cm^{-1} . Zbog toga je ovaj ramanski spektar prikazan na Slici 2.36. modelovan kao zbir F_{2g} moda dobijenog primenom MFO sa nehomogenim naprezanjem (kao na Slici 2.35.) i lorencijana, koji odgovara dodatnom ramanskom modu, sa sledećim parametrima: $\omega_d=599 \text{ cm}^{-1}$ i $w_d=75 \text{ cm}^{-1}$. Dodatni mod može se pripisati ramanskom spektru drugog reda i povezan je sa prisustvom sopstvenih kiseoničnih vakancija u $\text{CeO}_{2-\delta}$ [56, 126]. Pojava ovog moda je u skladu sa viđenjem koje daju Tsunekawa i saradnici [65, 107], koji su uočili da do širenja kristalne rešetke u nanokristalnom CeO_2 dolazi usled povećanja koncentracije kiseoničnih vakancija i prisustva Ce^{3+} jona. Ovo širenje je posledica gubitka kiseonika sa površine CeO_2 čestica, odnosno pojave tzv. *svojstvenih*

ili *unutrašnjih* O^{2-} vakancija, koje potiču od povećane nestehiometrije u nanokristalim CeO_2 nanoprahovima sa smanjenjem dimenzije kristalita³⁰.

2.5.2. Primena MFO na ramanski spektar $Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-\delta}$ nanoprahova

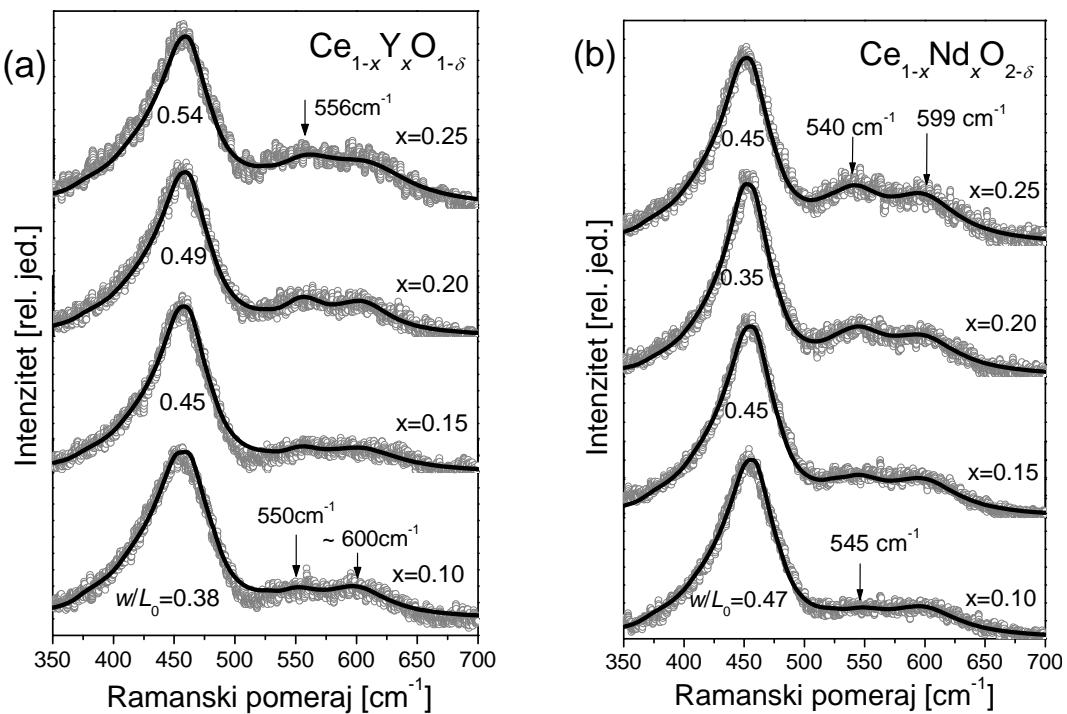
Ramanski spektri prvog reda (na sobnoj temperaturi) nanokristalnog CeO_2 dopiranog itrijumom ($Ce_{1-x}Y_xO_{2-\delta}$) i neodimijumom ($Ce_{1-x}Nd_xO_{2-\delta}$), prikazani na Slici 2.37, imaju izražen F_{2g} mod, koji odgovara fluoritnoj strukturi CeO_2 [55, 67]. Ovaj mod je, u odnosu na čist nanokristalni CeO_2 , pomeren ka višim, odnosno nižim učestanostima, u skladu sa veličinom jonskog radiusa dopanta, Y, odnosno Nd. Na Slici 2.37 prikazani su eksperimentalni spektri ovih čvrstih rastvora, sa koncentracijama Y(Nd) dopanta x od 10, 15, 20 i 25%. Pored F_{2g} moda, u ramanskim spektrima se javljaju još dva dodatna moda, čije će poreklo biti posebno analizirano.

Pri modelovanju ramanskih spektara čvrstih rastvora $Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-\delta}$ ($0.1 \leq x \leq 0.25$) korišćen je isti metod kao i u slučaju $CeO_{2-\delta}$ nanopraha, s tim što je u model uključena kontrakcija, odnosno dilatacija rešetke u zavisnosti od dopanta, u skladu sa promenom parametra rešetke dopiranih uzoraka prema Vegardovom zakonu, prikazanom u Poglavlju 1.2.3.2 na Slici 1.15(b). Modelovani spektri su dobijeni kao zbir F_{2g} moda modelovanog primenom MFO sa nehomogenim unutrašnjim naprezanjem i odgovarajućih lorencijiana za dodatne modove. U MFO su korišćeni isti parametri kao u slučaju čistog $CeO_{2-\delta}$ nanopraha, sa različitim širinama (w) simetrične Gauss-ove raspodele, koje su označene na Slici 2.37.

Kao što je pomenuto, u ramanskim spektrima ovih materijala na sobnoj temperaturi pojavljuju se dva dodatna moda. Prvi mod, koji se nalazi na $\sim 600\text{ cm}^{-1}$, zapažen je i u čistom $CeO_{2-\delta}$ nanoprahu [93, 126] i pripisuje se defektima kristalne rešetke u vidu kiseoničnih vakancija [56, 128]. To su tzv. *sopstvene* ili *unutrašnje* O^{2-} vakancije, koje potiču od povećane nestehiometrije u $CeO_{2-\delta}$ nanoprahovima. U

³⁰ Wu [127] i saradnici delimično su potvrdili ove prepostavke, ukazujući na neuniformnu distribuciju Ce^{3+} i Ce^{4+} jona sa pripadajućim kiseoničnim vakancijama, koja se može u prvoj aproksimaciji predstaviti strukturom $CeO_2(Ce^{4+})$ koju okružuje ljuska $CeO_{1.5}(Ce^{3+})$.

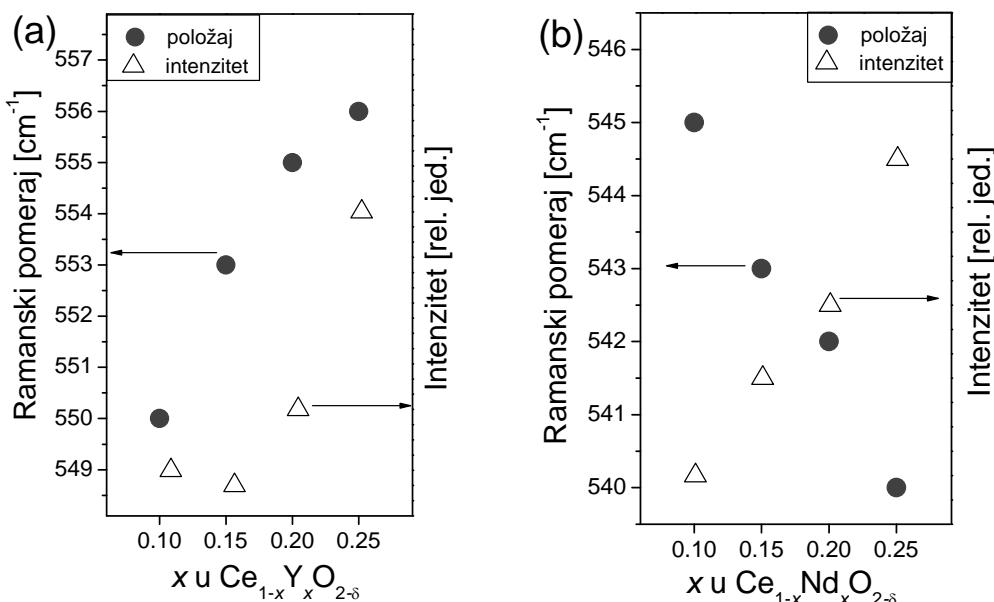
uzorcima dopiranim Y(Nd) ovaj mod se nalazi na gotovo istom mestu, a njegov intenzitet se ne menja mnogo sa stepenom dopiranja, kako je i prikazano na Slici 2.37.



Slika 2.37. Ramanski spektri čvrstih rastvora $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}_x\text{O}_{2-\delta}$ (a) i $\text{Ce}_{1-x}\text{Nd}_x\text{O}_{2-\delta}$ (b) sa koncentracijama dopanata $0.10 \leq x \leq 0.25$, zajedno sa modelovanim spektrima. Najintenzivniji ramanski modovi izračunati su primenom MFO sa nehomogenim naprezanjem, a dodatni modovi koji potiču od defekata lorencijjanima.

U spektrima obe serije dopiranih uzoraka pojavljuje se još jedan mod na visokofrekventnoj strani F_{2g} moda, čiji intenzitet raste sa porastom koncentracije dopanta. Položaj ovog moda u Y-dopiranim uzorcima kreće se od ~ 550 do 556 cm^{-1} sa porastom koncentracije Y. Kod uzorka dopiranih Nd, sa porastom koncentracije Nd, njegov položaj se pomera na suprotnu stranu, tj. od ~ 545 ka 540 cm^{-1} . Na Slici 2.38 prikazani su intenziteti i položaji ovog moda u Y^{3+} i Nd^{3+} dopiranim uzorcima u funkciji koncentracije dopanta x . Ovaj mod su u kristalu CeO_2 dopiranom Y već registrovali Nakajima i saradnici [55], koji su uočili njegovo pomeranje od 540 do 560 cm^{-1} pri varijaciji koncentracije dopanta $0.09 \leq x \leq 0.18$. Poreklo ovog moda pripisano je prisustvu defekata, koji, osim jona dopanta, sadrže i O^{2-} vakancije i njihova pozicija se menja u različitom atomskom okruženju. Naime, u ovakvim sistemima vibracijska stanja

defekata u mnogome zavise od lokalnog okruženja vakancija tj. od toga da li su najblizi susedi vakancije metalni joni (tzv. M_4O_v - kompleks), kiseonični joni (tzv. O_6O_v - kompleks) ili neka linearna kombinacija, kao što je prikazano na Slici 1.11 u Poglavlju 1.3.1.



Slika 2.38. Promena položaja i intenziteta dodatnog ramanskog moda u $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}_x\text{O}_{2-\delta}$ ($0.1 \leq x \leq 0.25$) (a) i $\text{Ce}_{1-x}\text{Nd}_x\text{O}_{2-\delta}$ ($0.1 \leq x \leq 0.25$) (b) nanoprahovima.

Pojava vakancije na mestu O^{2-} jona dovodi do promene međuatomskih sila između okolnih jona. To dovodi do promene ravnotežnih položaja jona u blizini vakancije i do promene simetrije, tj. promene vibracijskih stanja. Zbog toga se očekuje da se vibracijska svojstva defektnih stanja, koja se mogu razložiti na prostor koji sadrži vakanciju i na onaj koji je ne sadrži (Slika 1.12(b) i (c)), razlikuju od defektnih stanja koja se ne mogu razložiti na ovaj način (Slika 1.12(d)). Odavde sledi i da promena vibracijskih stanja utiče na intenzitet i položaj ramanskih modova koji odgovaraju kiseoničnim vakancijama.

Lin i saradnici [128] su uočili prisustvo ovog moda i u čvrstom rastvoru CeO_2 dopiranog Nd, sa česticama nanometarskih dimenzija (~7.2 nm), ali nisu objašnjavali njegovo poreklo. Na osnovu rezultata koje daju Nakajima [55] i Lin [128] sa saradnicima, zaključeno je da u našim uzorcima CeO_2 nanoprahova dopiranih Y i Nd ovaj mod potiče od tzv. *uvedenih* vakancija, kada se Ce^{4+} joni zamene trovalentnim Y(Nd). Različit položaj ovog moda može se objasniti različitim defektnim stanjima, tj.

različitim lokalnim okruženjem vakancija. Kod Y-dopiranih uzoraka defektna stanja su takva da su najbliži susedi kiseoničnoj vakanciji joni dopanta (defektno stanje dato na Slici 1.14(d)). Ovo potvrđuju i novija EXAFS (*Extended X-Ray Absorption Fine Structure*) merenja na cerijumovim jedinjenjima dopiranim sa Y^{3+} jonima [129], koja su pokazala da Y^{3+} joni imaju jaku tendenciju da se grupišu, formirajući tako bogat klaster oko vakancije. Za razliku od Y-dopiranih uzoraka, kod Nd-dopiranih uzoraka defektno stanje se najverovatnije može razložiti na prostor koji sadrži vakanciju i na onaj koji je nema, kako je ilustrovano na Slici 1.14(b) i (c).

Imajući u vidu ranije pominjane rezultate drugih autora, može se zaključiti da je pojava novog moda u $\text{Y}(\text{Nd})$ dopiranim CeO_2 nanostrukturama povezana sa kiseoničnim vakancijama, koje nastaju u fluoritnoj rešetki radi očuvanja elektroneutralnosti, kada se Ce^{4+} joni zamenjuju trovalentnim katjonima $\text{Y}^{3+}(\text{Nd}^{3+})$. Različit smer pomeranja ovog moda sa povećanjem koncentracije različitih dopanata u skladu je sa sabijanjem i širenjem kristalne rešetke do koga dolazi dopiranjem katjonima manjeg i većeg jonskog radiusa (kako je prikazano na Slici 1.15(b) u Poglavlju 1.2.3). Takođe se pretpostavlja da je položaj ovog moda povezan sa različitim tipom defekata, koji se javljaju u $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ uzorcima, u zavisnosti od vrste dopanta. U uzorcima dopiranim irtijumom defekti obuhvataju O^{2-} vakanciju i dva katjona u najbližem susedstvu [69], dok se kod Nd dopiranih uzoraka defekti mogu razložiti na one sa O^{2-} vakancijama i bez njih [57].

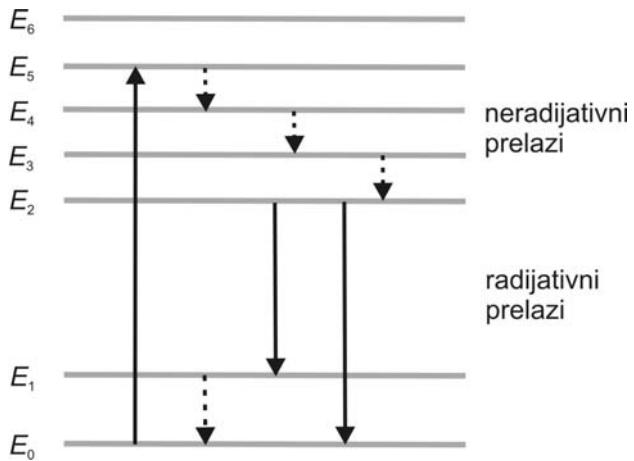
Sa druge strane, mod F_{2g} , čija učestanost je pridružena simetričnom "dišućem" modu CeO_8 vibracijske jedinice, po pravilu bi trebalo da je osetljiv na bilo koji poremećaj kiseonične subrešetke [57]. Povećana koncentracija kiseoničnih vakancija po pravilu utiče na položaj, oblik i širinu ramanskog moda. Imajući u vidu asimetrično širenje F_{2g} moda, sa $\sim 10 \text{ cm}^{-1}$ karakterističnih za kristal na $\sim 40 \text{ cm}^{-1}$ za dopirani nanoprah, može se pretpostaviti da takvo širenje F_{2g} moda u $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ čvrstim rastvorima mora poticati od visoke koncentracije kiseoničnih vakancija. Svi ovi rezultati potvrđuju sposobnost ramanske spektroskopije da uspešno identificuje i razlikuje lokalno okruženje vakancija u fluoritnoj strukturi.

3. FOTOLUMINESCENTNA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA

3.1. Teorijske osnove fotoluminescentne spektroskopije

Uopšteno govoreći, luminescencija predstavlja emisiju elektromagnetskog zračenja, koja se kod neorganskih materijala obično odvija u vidljivoj ili bliskoj infracrvenoj oblasti. Luminescentna emisija uključuje radijativne prelaze između elektronskih energijskih nivoa i predstavlja karakteristiku datog materijala i temperature na kojoj se on nalazi [130]. Prelazi potiču od nekih pobuđenih elektronskih nivoa, pri čemu, nakon emisije ftona, elektron zauzme niži elektronski nivo. Kako intenzitet luminescencije zavisi od broja naseljenih pobuđenih stanja, veoma je bitno na koji način dolazi do pobuđivanja materijala. Ukoliko se materijal pobuđuje elektromagnetskim zračenjem, odnosno fotonima, rezultujuća emisija naziva se *fotoluminescencija* (FL).

Na Slici 3.1. prikazani su osnovni ekscitacioni i emisioni procesi. Osnovno stanje ima energiju E_0 (i popunjeno je na niskim temperaturama, kada nema nikakvog mehanizma pobude), dok su E_1 do E_5 energije pobuđenih stanja. Proces eksitacije odgovara prelasku iz osnovnog E_0 u pobuđeno stanje E_5 . Razmak izmedju pojedinačnih stanja $E_2 - E_5$ je mali, tako da se materijal iz najvišeg pobuđenog stanja E_5 vraća u niža pobuđena stanja (do E_2) kaskadnim *neradijativnim prelazima*, uz emisiju fonona, tj. oslobođajući energiju u vidu toplove [130], dok je *radijativni prelaz* praćen emisijom ftona i dešava se kada je razmak pobuđenog i susednog nivoa dovoljno veliki, kao npr. u slučaju procepa između nivoa E_2 i E_1 prikazanih na Slici 3.1.



Slika 3.1. Proces ekscitacije i luminescencija u hipotetičkom materijalu: šema elektronskih energijskih nivoa [130].

Telo koje emitiše zračenje sastoji se od velikog broja atoma (jona), koji međusobno interaguju, što je mnogo složeniji sistem od izolovanih atoma. Zato energijski nivoi u čvrstom telu ne zavise samo od energijskih nivoa jona ili atoma koji ulaze u njegov sastav, već i od načina na koji se atomi ili joni kombinuju u datom materijalu. Pokazalo se da materijal, da bi emitovao FL spektar, treba da ima dovoljan energijski procep izmedju dva susedna nivoa.

Neorganski luminescentni materijali su najčešće širokozonski poluprovodnici ili izolatori, koje karakterišu popunjena valentna i prazna provodna energijska zona, između kojih se nalazi zabranjena zona - energijski procep. Foton sa energijom jednakom ili većom od vrednosti energijskog procepa može ekscitovati valentni elektron kroz energijski procep u provodnu zonu. Apsorpcija se takođe javlja kada foton ekscituje elektron iz neutralnog donora u provodnu zonu ili iz valentne zone u neutralni akceptor, a moguće je indukovati i apsorpcioni prelaz iz valentne zone u ionizovani donor ili iz ionizovanog akceptora u provodnu zonu. Fotoluminescencija se javlja kada se elektron ekscitovan na neki od navedenih načina vraća u početno stanje. Ukoliko je ovaj proces praćen radijacijom, dolazi do emitovanja fotona, čija energija daje razliku između ekscitovanog i početnog stanja energija, a emisioni spektri pokazuju pikove povezane sa energijom svakog ekscitovanog nivoa. Pri tome treba imati u vidu da je rekombinacija neravnotežni proces, koji zahteva snabdevanje elektrona energijama koje su iznad ravnotežnih vrednosti.

Luminescencija kod *poluprovodnika* može biti u vidljivoj ili bliskoj infracrvenoj oblasti spektra, što prvenstveno zavisi od širine energijskog procepa, ali i od energije elektronskih nivoa, koji mogu da se nalaze unutar energijskog procepa, a indukovani su prisustvom defekata u materijalu. Kod *izolatora*, energijski procep odgovara energiji fotona iz ultraljubičastog dela spektra, tako da se luminescencija kod čistih izolatora ne očekuje u vidljivoj oblasti. Međutim, atomi nečistoća i defekti uvek su prisutni u materijalu, tako da se i u izolatorima, kao i u poluprovodnicima, mogu formirati elektronski nivoi odvojeni procepom čija širina odgovara energiji fotona vidljive svetlosti [130].

U uređajima za merenje fotoluminescencije izvor zračenja može biti bilo koji laser, čija energija fotona premašuje energijski procep ispitivanog materijala ili procep između elektronskih nivoa unutar energijskog procepa indukovanih prisustvom defekata u materijalu. HeCd ili Ar^+ gasni laseri zadovoljavaju ovaj kriterijum za većinu poluprovodnih materijala. FL merenja se mogu vršiti sa istim optičkim uređenjem kao za ramanska merenja, mada se kod FL merenja najčešće koriste monohromatori sa jednom rešetkom, dok se kod merenja ramanskih signala, zbog potrebe za većom linearnom disperzijom, koriste monohromatori sa dve ili tri rešetke. Princip rada uređaja je sledeći: svetlosni zrak iz izvora pada na uzorak (u kriostatu, ukoliko se vrše merenja na niskim temperaturama), a zatim se FL signal fokusira na ulaz u monohromator. Monohromator bira talasne dužine koje se registruju detektorskim sistemom. FL spektri su znatno bolji na temperaturi nižoj od sobne - hlađenjem se dobijaju oštiri i prepoznatljiviji pikovi.

FL spektri predstavljeni u ovom radu dobijeni su primenom ramanske aparature prikazane na Slici 2.5 u Poglavlju 2.2, u istoj optičkoj konfiguraciji kao i kod ramanskih merenja. Razlike između FL i ramanskih merenja odnose se samo na postupak prikupljanja eksperimentalnih podataka i njihovu interpretaciju. Zbog velike širine FL pikova, FL merenja se vrše u mnogo većem opsegu učestanosti i sa znatno manjom rezolucijom nego ramanska. Pri tome, s obzirom na veliki intenzitet FL signala, nije potrebno višestruko skeniranje i usrednjavanje dobijenih spektara. U interpretaciji rezultata mora se voditi računa o činjenici da se ramanski pomeraj ω određuje u odnosu na energiju E_L odgovarajuće linije pobudnog lasera. Zbog toga se merenje FL vrši u apsolutnim, a ne raletivnim jedinicama.

3.1.1. Fotoluminescencija u niskodimenzionim sistemima

Fotoluminescentna spektroskopija, kao važna nedestruktivna tehnika, omogućava dobijanje velikog broja informacija o materijalima. To je jedna od najkorisnijih optičkih metoda za karakterizaciju elektronske strukture, optičkih i fotoelektričnih svojstava materijala. Budući da je direktno povezana sa elektronskom struktururom i prelazima, FL spektroskopija predstavlja važnu dopunu spektroskopskim metodama, koje se oslanjaju na vibracije kristalne rešetke (kao što su ramanska i IC spektroskopija) [73, 131].

Kada su u pitanju nanomaterijali, FL spektroskopija daje važan doprinos pri izučavanju stepena kristaličnosti i naprezanja u materijalu, kompozicije i stehiometrije, optičkih svojstava i dimenzija nanomaterijala. Optička svojstva nanostruktturnih materijala razlikuju se u velikoj meri od svojstava kristala i amorfnih materijala. Nanostrukturalni materijali po pravilu pokazuju drugačija optička svojstva, zahvaljujući nanometarskim dimenzijama čestica i pojavi defekata i nečistoća, kao i izmenjenim simetrijskim uslovima [132].

Razlike u ponašanju elektrona u kristalnim i niskodimenzionim poluprovodnicima nastaju usled razlike u gustini stanja elektrona³¹. U poluprovodnim kristalima elektroni u valentnoj zoni apsorbuju fotone i prelaze u provodnu zonu, ostavljajući šupljinu u valentnoj zoni. Ovaj proces se javlja kada je ispunjen uslov $\hbar\omega \geq E_g$, gde je E_g širina energijskog procepa poluprovodnika, a ω učestanost upadnog fokona. Neki od ovih eksitovanih elektrona gube energiju putem neradijativnih prelaza i tada je moguće da sa dna provodne zone elektron pređe u šupljinu u valentnoj zoni putem radijativnog prelaza. Zbog toga se u FL spektru obično vide najniži energijski nivoi i učestanost emitovane FL je $\omega_{FL} < \omega$. Na taj način FL spektar poluprovodnog kristala u opštem slučaju odgovara njegovom energijskom procepu [73]. U niskodimenzionim sistemima, usled kvantizacije energijskih nivoa u provodnoj i valentnoj zoni po pravilu dolazi do povećanja energijskog procepa. Kako učestanost FL emisije odgovara prelazu eksitovanih elektrona iz najnižeg stanja u provodnoj zoni u

³¹ Na primer, gustina stanja elektrona, $N(E)$, u zapreminskom poluprovodniku (3D) ima kontinualnu zavisnost oblika $N(E) \sim E^{1/2}$, dok je u dvodimenzionim (2D) poluprovodnicima njena zavisnost u obliku *step* funkcije. U jednodimenzionim (1D) poluprovodničkim strukturama ona divergira sa energijom kao $E^{-1/2}$, dok je za 0D poluprovodnike *delta* funkcija energije [73].

najniže stanje u valentnoj zoni, FL pik u ovim sistemima pomeren je u odnosu na njegov položaj u kristalnim materijalima. Ovaj proces može biti direktni i indirektni, a karakteristična promena energijskog procepa sa smanjenjem veličine klastera može biti istražena na osnovu plavog pomeraja u položaju FL pika [73, 133]. Uz to se, kada je prečnik čestice veoma mali³², u nanomaterijalima može javiti fotoluminescencija, povezana sa ekscitonskim mehanizmom usled kvantnog fononskog ograničenja.

FL spektroskopija takođe daje informacije o gustini površinskih stanja preko promene intenziteta i širine spektra [135]. Površinska stanja su prouzrokovana prekidom periodičnog uređenja atoma, kao i prisustvom nečistoća na površini, čiji uticaj je, usled povećanja pokretljivosti elektrona i šupljina, dominantan čak i kada su prisutne u veoma malim količinama [130]. Ovaj efekat veoma je izražen kod nanostruktura zbog velikog odnosa površine i zapremine materijala. Pored toga, na graničnim površinama nanomaterijala javlja se mnogo veći broj visećih i nezasićenih veza nego u kristalnim materijalima, tako da usled prisustva defekata može doći i do formiranja nekih energijskih nivoa unutar energijskog procepa, usled čega se u FL spektrima nanomaterijala mogu pojaviti nove luminescentne trake. Ove FL trake mogu biti pobudene i energijama fotona manjim od energije zabranjene zone.

3.2. Fotoluminescentni spektri anatas TiO₂

FL spektroskopija je, kao veoma značajna tehnika, korišćena za proučavanje elektronske strukture, kao i optičkih, fotohemijskih i fotoelektričnih svojstava u rutilnoj i anatas fazi TiO₂ monokristala, tankih slojeva i polikristalnih prahova [136]. Istraživanja fotoluminescencije poslednjih godina rađena su i na TiO₂ nanokristalima, ali treba imati u vidu da FL procesi u TiO₂ nanokristalima još nisu u potpunosti razjašnjeni [131, 137].

Sekiya i saradnici [138-140] pokazali su da monokristal anatas TiO₂ ekscitovan energijom (3.4 eV) većom od energije zabranjene zone pokazuje široku luminescenciju na oko 2.3 eV. Oni su razložili ovaj FL spektar na 3 gausijana, koji odgovaraju

³² Ekscitonski (Bohr-ov) radijus iznosi 1-10 nm. Kada bar jedna dimenzija nanomaterijala (nanočestice) postane uporediva sa ovim radiusom, tada ona ima značajan uticaj na elektronska, magnetska i optička svojstva materijala [134].

modovima na oko 1.95, 2.15 i 2.40 eV. Najniži FL mod na \sim 1.95 eV povezali su sa prisustvom kiseoničnih vakancija, mod na \sim 2.15 eV pripisali su relaksaciji samozarobljenih ekscitona (SZE)³³, a za mod na \sim 2.40 eV pretpostavili su da potiče od ekscitona vezanih za delimično redukovani Ti ion. Za razliku od njih, Watanabe i saradnici [137, 142] su kod monokristalnog anatas TiO_2 registrovali FL mod pripisan radijativnoj rekombinaciji SZE na oko 2.3 eV. Na sličan način, Sildos i saradnici [143] su zaključili da ekscitacija monokristala i polikristalnog filma anatas TiO_2 do nivoa provodne zone dovodi do samozarobljavanja ekscitonskih stanja, što prouzrokuje dosta jaku SZE emisiju na oko 2.35 eV. FL mod koji potiče od SZE registrovan je i u anatas TiO_2 tankim filmovima na oko 2.3 eV [144], odnosno 2.4 eV [145]. Wakabayashi i saradnici [146] predložili su model ekscitaciono-relaksacionih procesa koji učestvuju u luminescenciji usled rekombinacije SZE u anatas TiO_2 monokristalu ekscitovanom energijom većom od energijskog procepa. Za razliku od ovih istraživanja, Forss i Schubnell [35] široku luminescentnu traku registrovanu između 2 i 3 eV pripisali su luminescenciji koja potiče od površinskih stanja u anatas TiO_2 prahu ekscitovanom energijom većom od E_g .

Luminescenciju anatas TiO_2 nanopraha pobudenu svetlošću energije bliske energijskom procepu istraživali su Zhu i Ding [147], koji su emisiju na oko 2.6 eV pripisali površinskim stanjima, dok su Ghosh i Adhikari [31] emisiju na oko 2.8 eV povezali sa prelazima elektrona iz provodne zone u šupljine zarobljenje na Ti^{3+} intersticijama.

Sva do sada pomenuta istraživanja odnosila su se na ekscitaciju anatas TiO_2 svetlošću energije veće od širine energijskog procepa. Fotoluminescenciju pobudenu vidljivom svetlošću sa energijom manjom od širine zabranjene zone kod nanokristalnog TiO_2 u anatas fazi ispitivali su Zhang i saradnici [131, 136]. Njihovi eksperimentalni rezultati ukazuju da je radijativna rekombinacija posredstvom lokalizovanih nivoa unutar zabranjene zone, povezanih sa površinskim defektima, odgovorna za pojavu vidljive FL emisije sa maksimumom između 2.15 i 2.29 eV.

Na osnovu do sada izloženih istraživanja može se zaključiti da luminescentni spektri anatas TiO_2 mogu poticati iz nekoliko izvora: (i) kiseoničnih vakancija, (ii) površinskih stanja i (iii) samozarobljenih ekscitona [148]. FL modovi vezani za ove

³³ *Self-trapped excitons (STE).* Eksciton je nestabilna električno neutralna čestica, koju čini par elektron-šupljina, a koja se može kretati kroz kristal i prenosi energiju [141].

procese mogu nastati kako pri ekscitaciji energijama fotona većim od energije zabranjene zone E_g (Slika 3.2), tako i kada je anatas TiO₂ pobuđen vidljivom svetlošću energije manje od E_g (Slika 3.3). U ovom poglavlju biće više reči o svakom od ovih efekata, kao i o uslovima u kojima oni mogu doći do izražaja.

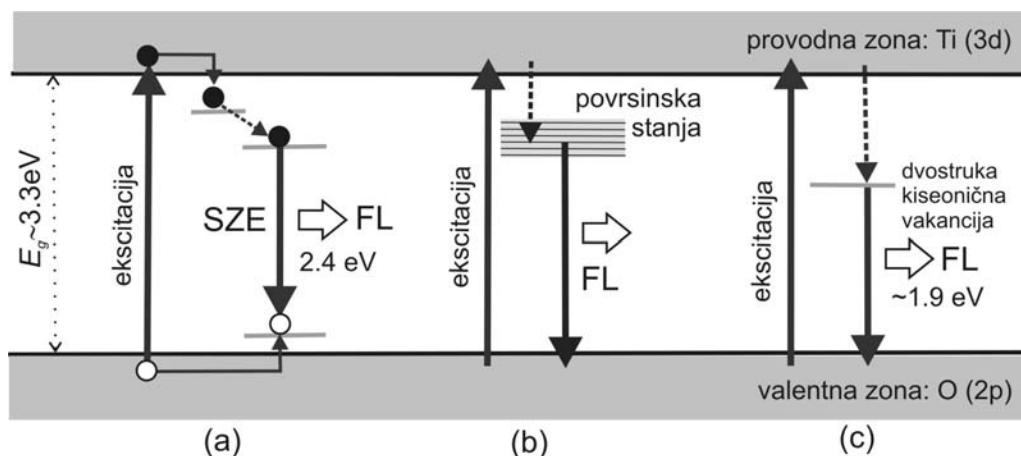
Samozarobljeni ekscitonni

Budući da i rutil i anatas imaju tetragonalne jedinične celije, dugo se verovalo da imaju ista elektronska svojstva, zbog čega je anatas TiO₂ dugo bio zapostavljan u istraživanjima. Kako je prikazano u Poglavlju 1.1.1, različita koordinacija mreže TiO₆ oktaedara karakterističnih za sve titatanate, iz koje proističe i različita gustina ovih materijala, predstavlja odlučujući faktor, koji doprinosi pojavi različitih uslova za lokalizovanje ekscitona, a samim tim, i različita fotoluminescentna svojstva [22, 149].

U skladu sa teorijom koju su izložili Toyozawa i saradnici [22, 150], ekscitaciju prate dva procesa – lokalizacija i delokalizacija ekscitona. U procesu lokalizacije pobuđeno stanje ima manju energiju ukoliko ostaje na mestu na kome je nastalo i karakteriše se energijom relaksacije kristalne rešetke (E_{RR}). U procesu delokalizacije, pobuđeno stanje teži da snizi svoju energiju prelaskom u susedno stanje, formirajući tako ekscitonsku zonu širine $2B$, koja zavisi od koordinacionog broja TiO₆ oktaedra [22] i energije potrebne za taj prelaz. Sistem tako snižava svoju energiju za iznos B . Ekscitonni su slobodni kada je zadovoljen uslov $B > E_{RR}$, što je slučaj kod rutila TiO₂. U suprotnom, kada je $B < E_{RR}$, dolazi do sparivanja ekscitona i fonona i samozarobljavanja ekscitona, što se dešava u anatas TiO₂. Ekscitonska zona obuhvata Ti 3d nivo, i, kao i sama provodna zona, uža je kod anatas nego kod rutilne faze, čemu doprinose mnogi međusobno povezani razlozi, kao što su veća elementarna celija, manja gustina materijala, veća Ti-Ti udaljenost, niža simetrija TiO₆ oktadara koja dovodi do veće degeneracije i cepanja zone. Svi ovi razlozi doprinose favorizovanju procesa lokalizacije, odnosno samozarobljavanja ekscitona u anatas fazi TiO₂ [22, 149].

Kao što je navedeno, u kristalima i tankim filmovima u anatas fazi, ekscitacija sa energijom većom od širine energijskog procepa prouzrokuje široku traku vidljive emisije, koja se upravo objašnjava radijativnom rekombinacijom SZE lokalizovanih unutar TiO₆ oktaedra [22, 137-140, 142, 145, 149]. Karakteristična pojava za FL mod

koji potiče od SZE u anatas TiO_2 je tzv. Stokes-ov pomeraj³⁴, usled koga je energija, na kojoj se ovaj mod nalazi, za oko 0.9 eV manja od širine zabranjene zone, koja je za ovaj materijal procenjena iz merenja transmisije u ultraljubičastoj oblasti i iznosi oko 3.3 eV [22, 32, 137]. Mehanizam nastanka luminescencije usled rekombinacije direktno formiranog SZE³⁵ ilustrovan je na Slici 3.2(a) i uključuje ekscitaciju elektrona iz valentne zone preko energijskog procepa u provodnu zonu, sa formiranjem malog polaron³⁶, koji, lokalizovan jakom interakcijom sa šupljinom, dovodi do formiranja SZE [146], čijom radijativnom rekombinacijom dolazi do FL emisije energije ~ 2.4 eV.



Slika 3.2 Ilustracija FL mehanizama u anatas TiO_2 pobuđenog energijom većom od E_g : proces radijativne rekombinacije koji uključuje SZE (a), površinska stanja (b) i dvostrukе kiseonične vakancije (c).

Lokalizovana površinska stanja

Kod kristalnog TiO_2 uočena je luminescencija sa spektralnom distribucijom ispod vrednosti energijskog procepa, što upućuje na to da se ona javlja na nivoima koji se nalaze unutar energijskog procepa [35]. Kao što je već rečeno, sa pojavom mnogo veće slobodne površine u nanomaterijalima, nego što je to slučaj u kristalima, dolazi do pojave mnogo različitih vrsta slobodnih i nezasićenih veza u nanomaterijalima, tj. defekata na površini i samim tim i nastanka novih energijskih stanja unutar zabranjene

³⁴ Stokes ov pomeraj definisan je kao razlika energije emisionog maksimuma i optičkog praga apsorpcije [22]

³⁵ Indirektno formiranje SZE obuhvata i određena zarobljena stanja neposredno iznad valentne zone [151].

³⁶ Mali polaron, kvazičestica koja obuhvata samozarobljeni elektron (lokalizovan u maloj oblasti čvrstog materijala, uporedivoj sa međatomskim rastojanjem) i potencijal deformisane kristalne rešetke u kome je elektron zarobljen [141].

zone [132]. Kod ovih materijala FL procesi su blisko povezani sa stehiometrijom površine i vrstom površinskih stanja, tako da, uopšteno rečeno, postoje 2 mehanizma za relaksaciju elektrona zarobljenih u površinskim stanjima: jedan je radijativna rekombinacija iz površinskog stanja u valentnu zonu, a drugi je neradijativni raspad na nečistoćama rešetke i nestehiometrijskim slojevima na površini materijala [131, 132]. Popunjena valentna zona kod TiO_2 u osnovi je zauzeta p elektronima kiseonika, a najniža provodna zona u većini formirana od titanijumskih $3d$ orbitala [15, 137]. Ti atom na površini nanočestice, usled pojave kiseoničnih vakancija ili naprezanja u nanomaterijalu, može da pređe u stanje Ti^{3+} , Ti^{2+} ili Ti^+ . Tada dolazi do pojave više lokalizovanih energijskih nivoa, koji formiraju zonu unutar energijskog procepa, a dominantno potiču od Ti površinskih defekata i nalaze se neposredno ispod dna provodne zone [35, 140] i česta su pojava kod titanata koji formiraju TiO_6 oktaedre ($BaTiO_3$, $SrTiO_3$) [131]. Na Slici 3.2(b) prikazan je mehanizam nastajanja luminescencije posredstvom lokalizovanih površinskih stanja, koji uključuje ekscitaciju elektrona iz valentne zone preko energijskog procepa u provodnu zonu [35], praćenu neradijativnim prelazom na neki od lokalizovanih nivoa i radijativnim prelazom, odnosno FL emisijom energije oko 2.2 eV.

Kiseonične vakancije

Kao što je već rečeno, anatas TiO_2 pripada grupi širokozonskih poluprovodnika i njegova električna provodnost može da se modifikuje dopiranjem, kao i promenom atomskog O/Ti odnosa [140].

Kiseonične vakancije dovode do značajnih promena u elektronskoj zonskoj strukturi i gustini stanja unutar zabranjene zone. U skladu sa tim, unutrašnji defekti u obliku kiseoničnih vakancija u većoj koncentraciji doprinose sužavanju energijskog procepa, povećanju broja nosilaca nanelektrisanja i pojavi međuzona unutar zabranjene zone [36].

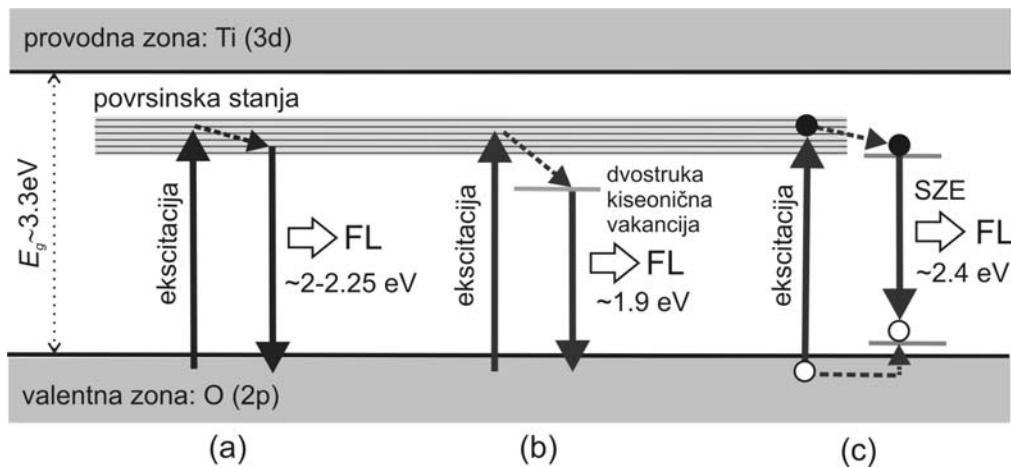
Kada je u pitanju lokacija energijskih nivoa unutar zabranjene zone, vezanih za kiseonične vakancije u TiO_2 , razni autori daju različita tumačenja. Veliki broj autora se slaže, uz odgovarajuću eksperimentalnu podršku, da su energijski nivoi kiseoničnih vakancija na sobnoj temperaturi locirani kao plitki nivoi unutar zabranjene zone na oko 0.7 do 0.9 eV ispod dna provodne zone [30, 32, 152, 153]. Da bi objasnio pojavu

optičkih prelaza sa energijama na oko 0.75 i 1.18 eV, Cronemeyer [30] uvodi pojam jednostrukih i dvostrukih kiseoničnih vakancija. Plitki nivoi mogu se povezati sa jednostrukim vakancijama, dok se dublji nivoi, vezani za dvostrukе vakancije (tj. parovi vakancija) pojavljuju sa povećanjem koncentracije kiseoničnih vakancija u TiO_2 . Yu i Halley [29] takođe predviđaju postojanje jednostrukih i dvostrukih kiseoničnih vakancija u elementarnoj celiji TiO_2 , pri čemu jednostrukе izazivaju izolovano stanje na ~0.7 eV ispod provodne zone, dok par vakancija formira dva odvojena nivoa (plitki na ~0.25 eV i duboki na oko ~1.2 eV), u zavisnosti od položaja vakancija u TiO_6 oktaedru. Pored toga, Takeda i saradnici [154] zaključuju da u uslovima velike koncentracije kiseoničnih vakancija, defekti povezani sa njima dovode do pojave novih energijskih nivoa na sredini zabranjene zone, koji mogu delovati kao rekombinacioni centri za fotogenerisane šupljine i elektrone. Međutim, treba imati u vidu da se većina opisanih rezultata odnosi na kristalne uzorke rutila, dok Lei sa saradnicima [148] za dva odvojena nivoa ispod dna provodne zone na oko 0.51 i 0.8 eV navodi da potiču od kiseoničnih vakancija kod kristalnog i nanokristalnog anatas TiO_2 .

Kako se energije plitkih nivoa u zabranjenoj zoni, koji delom potiču i od kiseoničnih vakancija, nalaze u opsegu energija površinskih stanja, to je i mehanizam nastanka luminescencije posredstvom ovih nivoa obuhvaćen procesom rekombinacije koji uključuje površinska stanja (Slika 3.2(b)). Na Slici 3.2(c) posebno je ilustrovan proces koji bi trebalo da odgovara radijativnoj rekombinaciji sa FL emisijom energije oko 1.9 eV, a uključuje energijski nivo koji se nalazi u sredini zabranjene zone, izazvan pojavom dvostrukih kiseoničnih vakancija.

Svi do sada opisani procesi odgovorni za FL u TiO_2 odvijaju se u uslovima ekscitacije energijom većom od E_g , koja uključuje ekscitaciju elektrona iz valentne u provodnu zonu (Slika 3.2). Za razliku od njih, fotoluminescencija, koja nastaje kao rezultat ekscitacije anatas TiO_2 vidljivom svetlošću energije manje od E_g , mora poticati od pobuđivanja nekih nivoa, koji su lokalizovani unutar energijskog procepa. Ovde je predložen model FL mehanizama, odgovornih za pojavu FL emisije kod anatas TiO_2 nanoprahova, koji je ilustrovan na Slici 3.3. On obuhvata već pomenute mehanizme FL emisije, koji potiču od površinskih stanja, dvostrukih kiseoničnih vakancija i SZE, s tim što se ekscitacija elektrona iz valentne zone ne odvija preko celog energijskog procepa,

već samo do nekog od nivoa lokalizovanih površinskih stanja u zavisnosti od energije fotona vidljive svetlosti.



Slika 3.3 Ilustracija FL mehanizma u TiO_2 nanoprahu eskcitovanom vidljivom svetlošću energije manje od E_g : proces radijativne rekombinacije, koji uključuje površinska stanja (a), dvostrukе kiseonične vakancije (b) i SZE (c).

Kada su u pitanju navedeni uzroci FL emisije kod anatas TiO_2 , treba ipak imati u vidu i njihovu uslovnu klasifikaciju. Kiseonične vakancije, i same vid površinskih defekata, neraskidivo su vezane sa Ti defektima na površini materijala, koji čine većinu površinskih stanja, koja opet, pod odgovarajućim uslovima učestvuju u formiranju ekscitona i njihovom samozarobljavanju.

3.2.1. Eksperimentalni FL spektri

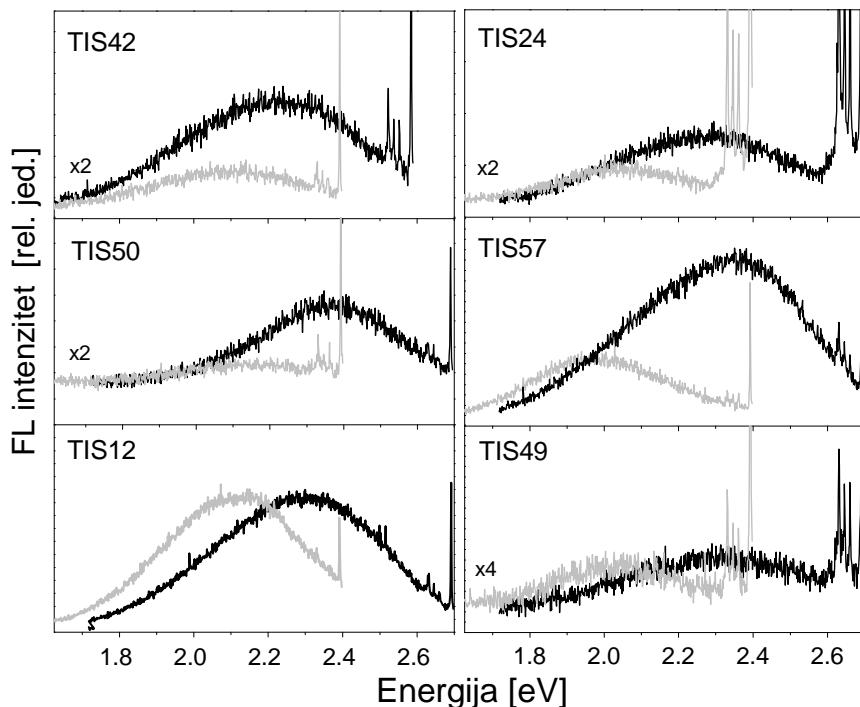
anatas TiO_2 nanoprahova

U ovom poglavlju će biti detaljno opisani procesi, koji u anatas TiO_2 nanoprahu pobuđenom energijom manjom od veličine energijskog procepa, dovode do pojave fotoluminiscencije u vidljivom delu spektra. Takođe će biti razmotren uticaj energije i snage pobude, kao i temperature i nestehiometrije izazvane laserskim ozračivanjem u vakuumu, na položaj i intenzitet FL spektra anatas TiO_2 nanoprahova.

Fotoluminescentni spektri, prikazani u ovom poglavlju, ekscitovani su vidljivom svetlošću, pri čemu je korišćeno šest linija Ar^+ lasera sa energijama fotona između 2.41 i 2.71 eV. Gustina laserske snage na uzorku menjala se u intervalu od 0.05 do

3. Fotoluminescentna spektroskopija oksidnih nanoprahova

0.8 W/cm². FL spektri snimani su najpre na sobnoj temperaturi u vazduhu, a zatim i u vakuumu i na niskim temperaturama.



Slika 3.4. FL spektri anatas TiO₂ nanoprahova pobuđeni laserskim linijama talasne dužine 2.41 eV, prikazani sivom linijom i 2.71 (2.60) eV, prikazani crnom linijom.

Na Slici 3.4. prikazani su FL spektri dobijeni na različitim anatas TiO₂ nanoprahovima ³⁷. FL spektri ekscitovani su dvema linijama Ar⁺ lasera talasne dužina 514.5 i 457.9 nm, odnosno energija 2.41 i 2.71 eV; uzorak TIS42 je, umesto linijom 457.9 nm, pobuđen linijom talasne dužine 476.5 nm (2.6 eV). Izlazna snaga lasera u svim slučajevima bila je relativno mala i iznosila je oko 5mW. Kao što se vidi na Slici 3.4., FL spektri anatas TiO₂ nanoprahova eksitovani vidljivom svetlošću navedenih energija sadrže široku FL traku sa maksimumom između 2.00 i 2.35 eV. Sa povećanjem energije pobude, kod svih uzoraka prisutno je značajno pomeranje maksimuma FL traka prema višim energijama. Takođe dolazi i do povećanja FL intenziteta kod većine uzoraka (izuzev TIS12 i TIS49). Pomeranje i promena intenziteta FL traka sa promenom energije pobude ukazuju da pri različitim energijama eksitacije verovatno

³⁷ Na visokoenergijskoj strani spektara jasno se uočavaju ramanski modovi anatas TiO₂ opisani u Poglavlju 2.4.

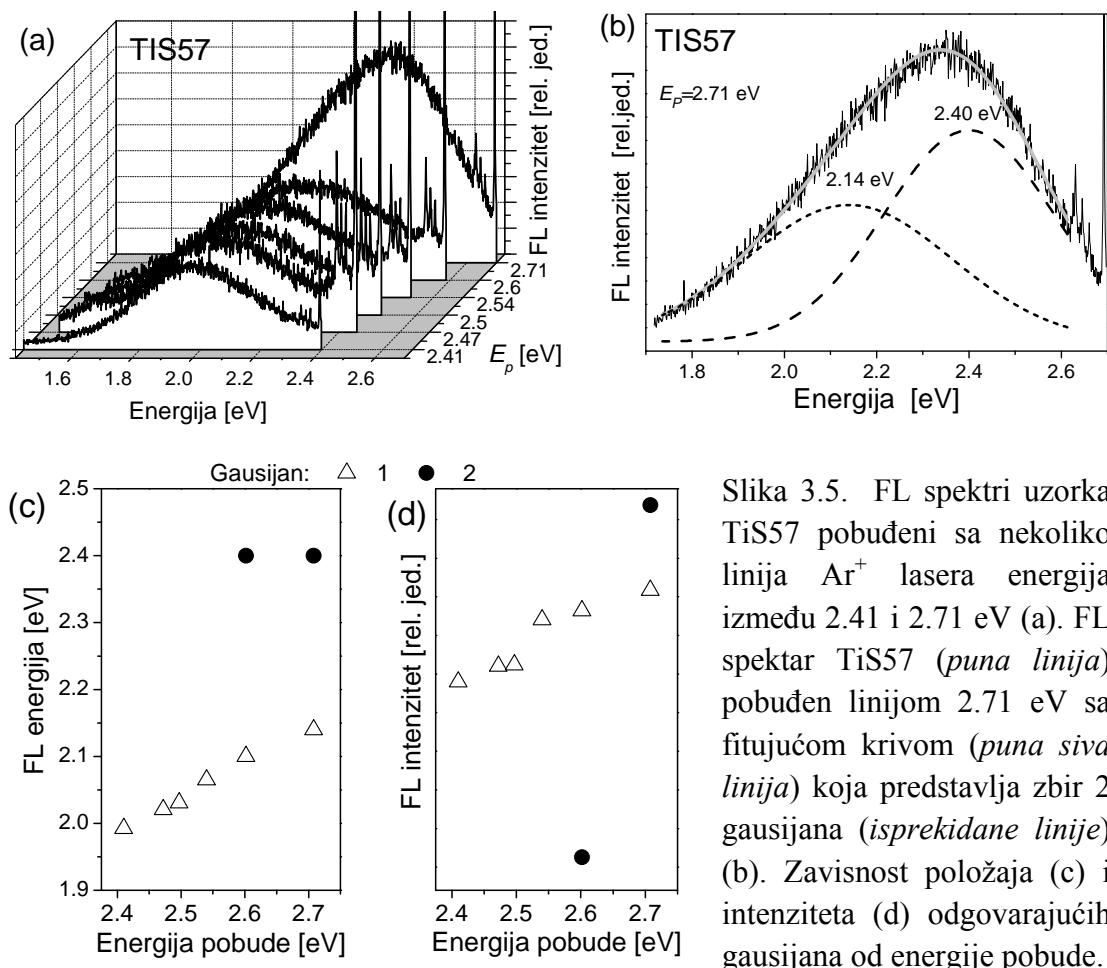
dominiraju različiti centri (defekti) odgovorni za luminescenciju u anatas TiO_2 , pa će ova pojava biti detaljnije razmotrena na primerima uzorka TIS57 i TIS12, sa veličinom kristalita 13.7, odnosno 18 nm i naprezanjem 0.80 i 0.22%, procenjenim iz XRD merenja.

3.2.1.1.Uticaj pobudne energije lasera na FL spekture anatas TiO_2 nanoprahova

Na Slici 3.5.(a) prikazani su FL spektri uzorka TIS57 ekscitovani laserskim linijama Ar^+ lasera energija od 2.41 do 2.71 eV³⁸, male snage (~5mW). Oblik i intenzitet FL spektra se očigledno menjaju sa povećanjem energije pobude. Pri najvećoj energiji (2.71 eV) oblik FL trake ukazuje na to da se ona ne sastoji samo od jednog FL moda. Ovaj spektar modelovan je zbirom dva gausijana i posebno je prikazan na Slici 3.5(b). Prvi gausijan je lociran na oko 2.14 eV i odgovara FL modu, koji bi mogao biti pripisan uticaju lokalizovanih površinskih stanja. Drugi gausijan na ~2.40 eV treba da odgovara FL modu povezanom sa pojmom SZE [138, 148]. Na sličan način fitovan je i spektar pobuden energijom 2.60 eV, dok su ostali spektri fitovani samo jednim gausijanom, koji odgovara FL modu pripisanom rekombinaciji preko površinskih stanja. Na Slikama 3.5(c) i (d) prikazane su zavisnosti položaja i intenziteta ovih FL modova sa povećanjem energije pobude od 2.41 do 2.71 eV.

Kao što se vidi sa Slike 3.5(c), položaj prvog FL moda se kontinualno menja od 2.00 do 2.14 eV, dok se njegov intenzitet ne menja mnogo. Ovo upućuje na postojanje više lokalizovanih nivoa u okviru zabranjene zone, koji mogu da učestvuju u FL procesu, kao i na to da ovi nivoi verovatno imaju približno istu luminescentnu efikasnost [131, 136], što ukazuje da bi ovaj FL mod u spektru TIS57 zaista mogao da potiče od radijativne rekombinacije elektrona preko površinskih stanja u TiO_2 nanočesticama. Pozicija drugog FL moda, koji se javlja tek pri pobudama veće energije (2.60 i 2.71 eV), ne menja se sa energijom pobude i nalazi se na oko 2.40 eV. Njegov intenzitet značajno raste, kako se energija pobude približava širini zabranjene zone, što upućuje na to da se ovaj FL mod može pripisati vidljivoj luminescenciji usled emisije SZE [22].

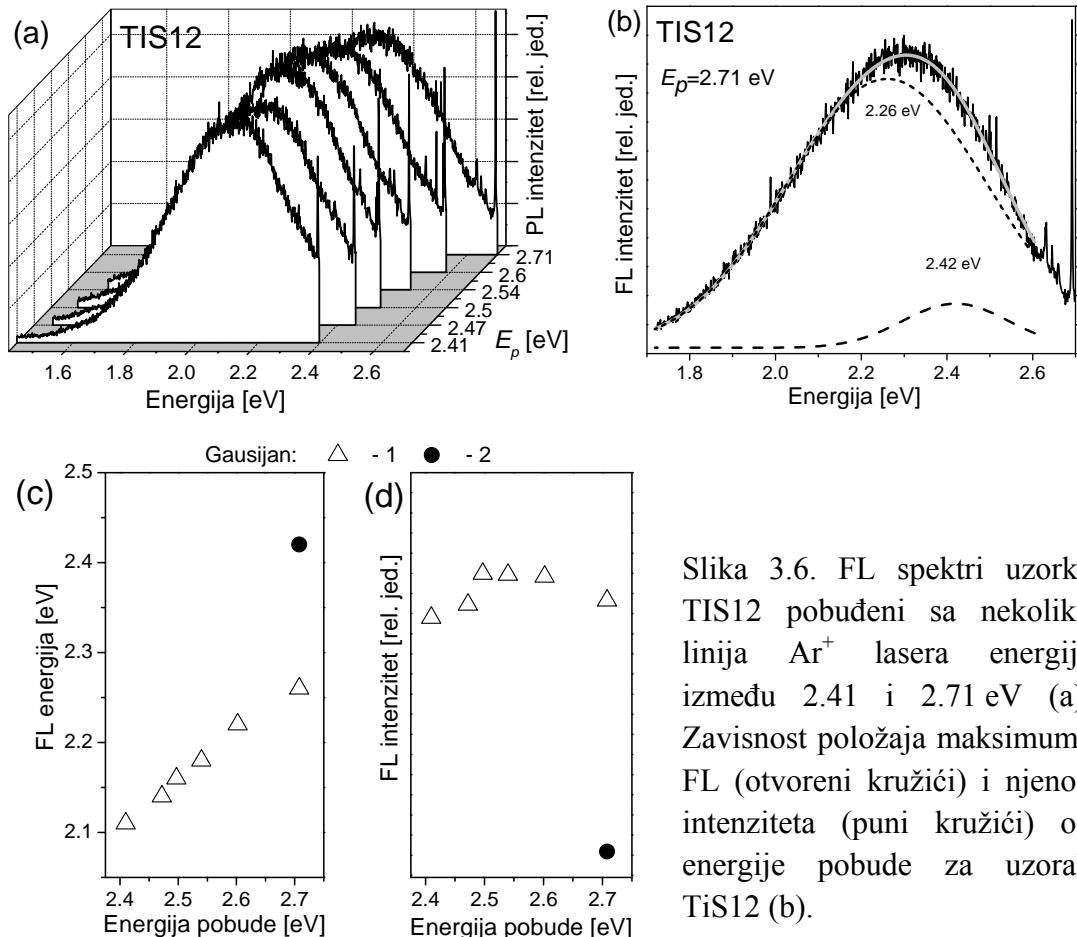
³⁸ Energije laserskih linija Ar^+ lasera: 514.5 nm (2.41 eV), 501.7 nm (2.47eV), 496.5 nm (2.497 eV), 488 nm (2.54 eV), 476.5 nm (2.60 eV), 457.9 nm (2.71 nm).



Slika 3.5. FL spektri uzorka TiS57 pobuđeni sa nekoliko linija Ar⁺ lasera energija između 2.41 i 2.71 eV (a). FL spektar TiS57 (*puna linija*) pobuđen linijom 2.71 eV sa fitujućom krivom (*puna siva linija*) koja predstavlja zbir 2 gausijana (*isprekidane linije*) (b). Zavisnost položaja (c) i intenziteta (d) odgovarajućih gausijana od energije pobude.

Na Slici 3.6(a) predstavljeni su FL spektri uzorka TIS12 pobuđeni linijama Ar⁺ lasera raznih energija i iste izlazne snage. Može se uočiti da, bez obzira na pobudu, svi spektri imaju sličan oblik. Zbog toga su oni, izuzev u slučaju pobude najveće energije, fitovani jednim gausijanom, koji odgovara FL modu koji se može povezati sa površinskim stanjima u anatas TiO₂ nanoprahu. Pored ovog moda, u FL spektru pobuđenom energijom od 2.71 eV, javlja se i FL mod malog intenziteta na oko 2.42 eV, koji se može pripisati rekombinaciji SZE, kao što je prikazano na Slici 3.6(b). Zavisnosti položaja i intenziteta FL modova od energije pobude predstavljene su na Slikama 3.6(c) i (d). Kada se energija pobude povećava, prvi FL mod ima jasno izražen plavi pomeraj od 2.11 ka 2.26 eV, bez značajne promene intenziteta. Očigledno je da je ponašanje FL spektra kod uzorka TIS12 pri svim energijama pobude određeno FL modom, koji se pripisuje površinskim stanjima. Promene ovog moda sa povećanjem

pobudne energije podsećaju na rezultate koje su prikazali Zhang i saradnici [131, 132]. Oni su pretpostavili da je za ovakvo ponašanje pri različitim energijama pobude odgovorna radijativna rekombinacija elektrona preko površinskih stanja.



Slika 3.6. FL spektri uzorka TIS12 pobuđeni sa nekoliko linija Ar⁺ lasera energija između 2.41 i 2.71 eV (a). Zavisnost položaja maksimuma FL (otvoreni kružići) i njenog intenziteta (puni kružići) od energije pobude za uzorak TiS12 (b).

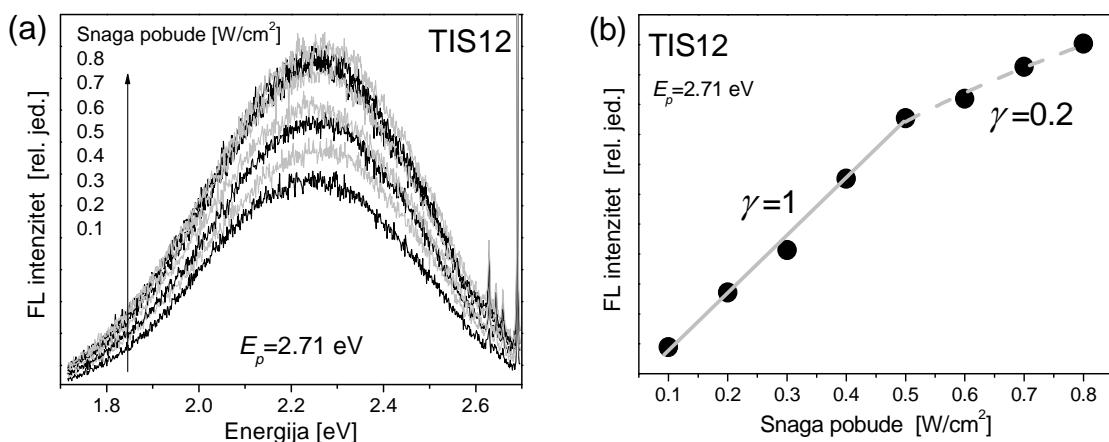
Treba imati u vidu da u ovim uzorcima nije registrovana pojava moda na ~ 1.9 eV, koji se, kao što je već rečeno, može povezati sa prisustvom dvostrukih kiseoničnih vakancija. Ovo se moglo i očekivati, s obzirom da su prikazani FL spektri snimani na sobnoj temperaturi u vazduhu, te da zbog toga u uzorcima TiO₂ nanoprahova ne postoji bitno odstupanje od stehiometrije.

Različito ponašanje FL spektara ova dva nanopraha ukazuje na različitu prirodu defekata koji dominiraju u njima. U FL spektrima nanopraha sa većim dimenzijama nanokristalita i manjim naprezanjem (TIS12) dominira radijativna rekombinacija elektrona preko sopstvenih površinskih stanja pri svim primenjenim energijama pobude. Nasuprot tome, ekscitacija uzorka sa manjim dimenzijama čestica i većim naprezanjem

(TIS57) pri većim energijama pobude, bližim energijskom procepu, uz očekivano prisustvo FL moda usled sopstvenih površinskih stanja, aktivira i luminescenciju izazvanu rekombinacijom SZE, koja je karakteristična za anatas TiO_2 kristal.

3.2.1.2. Uticaj pobudne snage lasera na FL spekture anatas TiO_2 nanoprahova

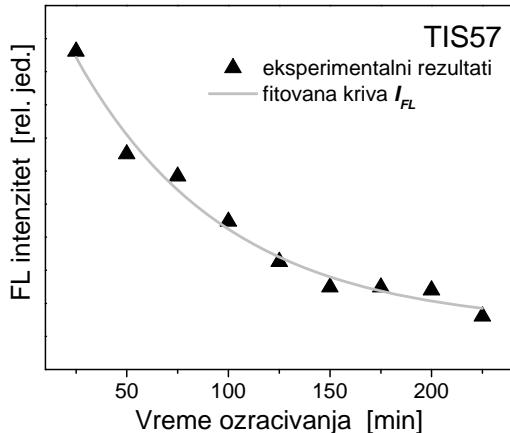
Slika 3.7(a) prikazuje FL spekture uzorka TIS12 pobuđene laserskom linijom energije 2.71 eV, pri čemu se izlazna površinska gustina snage lasera (P) menja od 0.1 do 0.8 W/cm^2 . Intenzitet FL spektra povećava se sa porastom pobudne snage, pri čemu se oblik spektra ne menja bitno. Zavisnost intenziteta FL signala (I_{FL}) od pobudne snage lasera FL prikazana je na Slici 3.7(b). Na istoj slici prikazana je i aproksimacija ove zavisnosti stepenom funkcijom oblika $I_{\text{FL}} \propto P^\gamma$. Može se zapaziti da je za manje snage pobude ova zavisnost *linearna* (puna linija, $\gamma=1$), dok pri snažnijoj pobudi postaje *sublinearna* (isprekidana linija, $\gamma=0.2$).



Slika 3.7. FL spektri nanopraha TIS12 pobuđeni linijom Ar^+ lasera energije $E_p=2.71$ eV, različite izlazne snage, od 0.1 do 0.8 W/cm^2 (a). FL intenzitet kao funkcija snage pobude (b).

Linearnu zavisnost FL intenziteta kod anatasa takođe registruju Tang i saradnici [22], pri pobudnim snagama manjim od 0.5 W/cm^2 , bez uticaja pobude na položaj i oblik spektra, što je i ovde slučaj. Uzorak TIS12 istovremeno pokazuje fotoluminescentna svojstva u zavisnosti od snage pobude, slična onima koje opisuju

Zhang i saradnici [136]. Sublinearna zavisnost FL intenziteta pri većim snagama pobude, kako ukazuju ovi autori, potvrđuje da se rekombinacija odvija preko određenih lokalizovanih površinskih nivoa, koji ulaze u zasićenje pri velikim snagama pobude i na taj način dopuštaju da se rekombinacija odvija preko odgovarajućih neradijativnih kanala.



Slika 3.8. Zavisnost FL intenziteta od vremena ozračivanja za TIS57 ($E_p=2.71$ eV).

FL spektri nanopraha TIS57, mereni pod istim uslovima kao i u slučaju uzorka TIS12, pokazuju sasvim drugačije ponašanje. Naime, zavisnost njihovog intenziteta od snage pobude nema oblik stepene funkcije. Razlog takvog (neregularnog) ponašanja mogao bi se tražiti u činjenici da FL intenzitet kod TIS57 brzo opada sa vremenom ozračivanja. Eksponencijalno opadanje FL intenziteta sa vremenom ozračivanja t , prikazano na Slici 3.8, modelovano je funkcijom $I_{FL}(t) = I_0 + A \exp(-t/t_1)$, gde su I_0 , A i t_1 parametri koji se podešavaju. Treba takođe napomenuti da znatno slabljenje FL signala u TIS57 sa vremenom ozračivanja može biti povezano sa promenom kompozicije materijala, kao i mogućim nastankom oštećenja na površini uzorka usled lokalnog pregrevanja prouzrokovanih dugotrajnim laserskim zračenjem [136], što je karakteristično za nanoprahove sa manjom veličinom čestice.

3.2.1.3. Uticaj nestehiometrije na FL spektre anatas TiO₂ nanoprahova

Do sada prikazani spektri mereni su u vazduhu na sobnoj temperaturi. U ovom poglavlju će biti pokazano kako promena stehiometrije izazvana najpre ozračivanjem uzorka u vakuumu, a zatim u vazduhu, utiče na oblik, položaj i intenzitet FL spektra kod anatas TiO₂ nanoprahova.

Na Slici 3.9(a) predstavljeni su FL spektri uzorka TIS12 snimani u vakuumu, pri čemu se vreme ozračivanja uzorka linijom Ar⁺ lasera energije 2.71 eV povećavalo od 20 do 420 min. Kao što se može videti, ozračivanje u vakuumu najpre dovodi do drastičnog povećanja intenziteta luminescencije, da bi nakon ozračivanja dužeg od 300 min došlo do izvesnog zasićenja. Sa slike se uočava i da, pored promene intenziteta ukupnog FL spektra, dolazi do pomeranja maksimuma luminescencije ka nižim energijama. Svi FL spektri modelovani su zbirom tri gausijana, koji su na Slici 3.9(a), radi preglednosti, prikazani samo za jedan FL spektar (nakon 20 min ozračivanja u vakuumu). Ovi gausijani odgovaraju FL modovima na oko 1.98, 2.26 i 2.42 eV. Položaj pojedinih modova ne menja se mnogo sa dužinom ozračivanja, dok je promena njihovog intenziteta sa dužinom ozračivanja u vakuumu prikazana na levoj strani Slike 3.9(c).

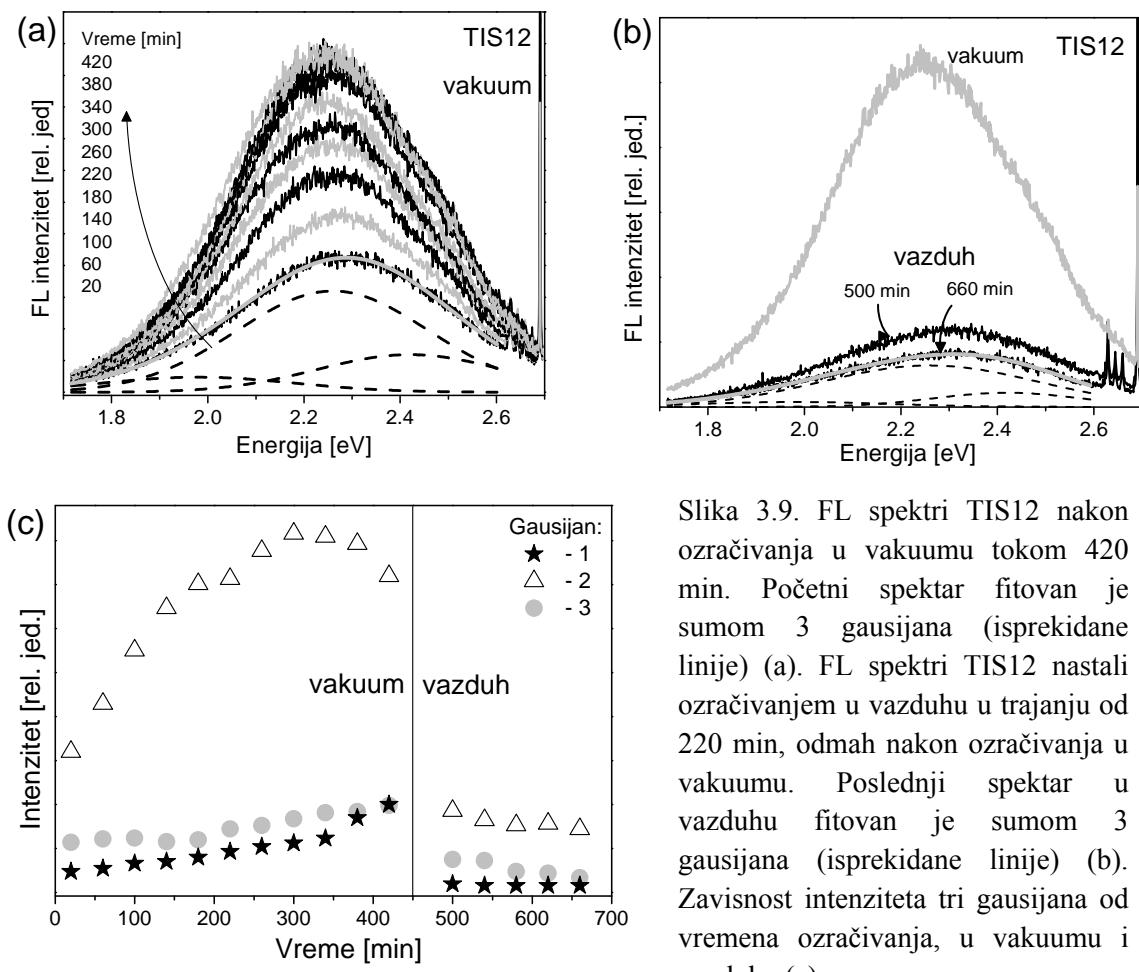
Sa dužinom ozračivanja u vakuumu povećava se intenzitet *prvog FL moda* na oko 1.98 eV, što upućuje da bi se on mogao povezati sa prisustvom dvostrukih kiseoničnih vakancija. Naime, dugotrajno ozračivanje u vakuumu dovodi do nestehiometrije i drastičnog povećanja koncentracije kiseoničnih vakancija, zbog čega se znatno povećava i verovatnoća pojave parova kiseoničnih vakancija, tj. dvostrukih vakancija. Kao što je već rečeno, prisustvo dvostrukih kiseoničnih vakancija dovodi do aktiviranja odgovarajućih luminescentnih centara.

Intenzitet *dugog FL moda*, na oko 2.26 eV raste sa dužinom ozračivanja u vakuumu, ali posle ~300 min ulazi u zasićenje. Ovakvo ponašanje ovog FL moda potvrđuje da je njegovo poreklo vezano za rekombinaciju preko površinskih stanja, s obzirom na to da se sa povećanjem nestehiometrije povećava i broj površinskih defekata odgovornih za pojavu lokalizovanih energijskih nivoa unutar zabranjene zone. S druge strane, prestanak porasta FL intenziteta nakon dugog ozračivanja u vakuumu mogao bi

biti prouzrokovani zasićenjem nekih lokalizovanih centara, koji učestvuju u radijativnim prelazima na sličan način kao što se to dešava i pri velikoj pobudnoj snazi (Slika 3.7).

Intenzitet trećeg *FL moda* na ~ 2.40 eV i njegovo ponašanje ukazuju na to da on potiče od rekombinacije SZE. Blagi porast njegovog intenziteta sa vremenom ozračivanja u vakuumu mogao bi biti povezan sa povećanjem broja indirektnih SZE, usled povećanja koncentracije kiseoničnih vakancija tokom ozračivanja u vakuumu [33]. S druge strane, znatno manja osetljivost ovog moda na pojavu nestehiometrije, može se objasniti činjenicom da se emisija javlja usled rekombinacije SZE, za koje se smatra da potiču od sopstvenih defekata [140].

Opisana promena intenziteta pojedinačnih FL modova, kao i promena odnosa njihovih intenziteta sa dužinom ozračivanja u vakuumu dovodi do prikazanog povećanja intenziteta i pomeranja celog FL spektra na stranu modova koji potiču od kiseoničnih vakancija i površinskih defekata, odnosno - ka nižim energijama.



Slika 3.9. FL spektri TIS12 nakon ozračivanja u vakuumu tokom 420 min. Početni spektar fitovan je sumom 3 gausijana (isprikidane linije) (a). FL spektri TIS12 nastali ozračivanjem u vazduhu u trajanju od 220 min, odmah nakon ozračivanja u vakuumu. Poslednji spektar u vazduhu fitovan je sumom 3 gausijana (isprikidane linije) (b). Zavisnost intenziteta tri gausijana od vremena ozračivanja, u vakuumu i vazduhu (c).

Nakon ozračivanja u vakuumu, proces ozračivanja uzorka TIS12 nastavlja se u vazduhu tokom sledećih 220 minuta, a odgovarajući FL spektri prikazani su na Slici 3.9(b). Ozračivanjem u vazduhu smanjuje se intenzitet FL signala i dolazi do pomeranja FL spektara ka većim energijama. Ovi spektri u vazduhu vraćaju oblik i intenzitet, koji su imalu pre tretiranja uzorka u vakuumu. I ovi spektri su modelovani zbirom tri gausijana, koji su, zbog preglednosti, na Slici 3.9(b) prikazani samo za jedan spektar (nakon 240 min ozračivanja u vazduhu). Na desnoj strani Slike 3.9(c) predstavljena je promena intenziteta pojedinih gausijana, koji odgovaraju ranije opisanim FL modovima. Naglo smanjenje intenziteta sva tri FL moda u vazduhu nesumnjivo nastaje kao rezultat popunjavanja kiseoničnih vakancija u uzorku anatas TiO_2 nanopraha usled laserskog ozračivanja na vazduhu, do čega dolazi praktično odmah po izlaganju uzorka vazduhu.

Uticaj laserskog ozračivanja u vakuumu na uzorak TIS57 ovde nije detaljno analiziran, s obzirom da je ono dovelo do ireverzibilnih promena, kako u FL spektrima, tako i u ramanskim³⁹ spektrima ovog uzorka. Ovakve promene ukazuju da je lasersko ozračivanje u vakuumu u ovom uzorku dovelo do strukturnih promena.

3.1.2.4. Uticaj temperature na FL spektre anatas TiO_2 nanoprahova

Uticaj temperature na FL spekture anatas TiO_2 nanoprahova analiziran je na uzorcima TIS57 i TIS12, sa ciljem da se pokaže uticaj hlađenja kako na FL spekture u celini, tako i na pojedine FL modove o kojima je bilo reči u prethodnim poglavljima. FL spektri pobuđivani su u vakuumu na temperaturama 300, 150 i 20K, plavom linijom Ar^+ laserska energije 2.71 eV. Nakon procesa hladjenja FL spektri su pobuđivani istom linijom na 300 K u vazduhu.

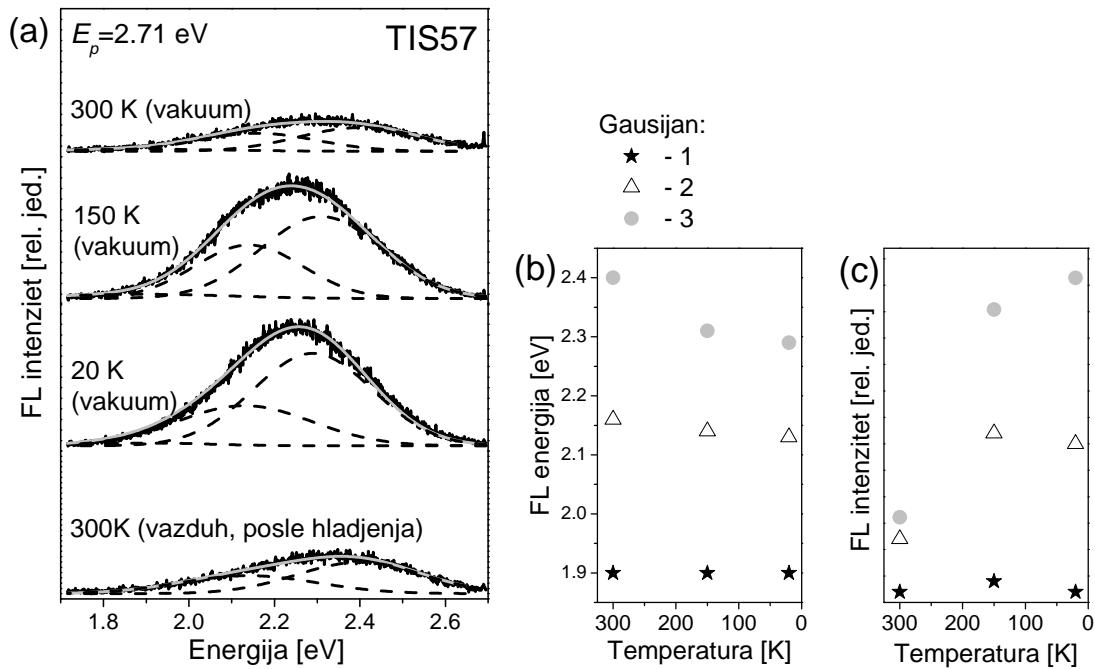
Kod uzorka TIS57 sa snižavanjem temperature dolazi do crvenog pomeraja, tj. pomeranja FL spektara ka nižim energijama. U cilju analize ovog pomeranja svi spektri fitovani su zbirom tri gausijana, kako je prikazano na Slici 3.10(a). Promena položaja i

³⁹ Primećeno je da se nakon ozračivanja uzorka TIS57, pored smanjenja intenziteta ramanskih modova koji pripadaju anatas TiO_2 , pojavljuju i dva nova moda na oko 596 i 885 cm^{-1} , koji ne pripadaju nijednoj od faza TiO_2 , već najverovatnije potiču od nezasićenih Ti-O veza, odnosno nestehiometrijskog TiO_x [122].

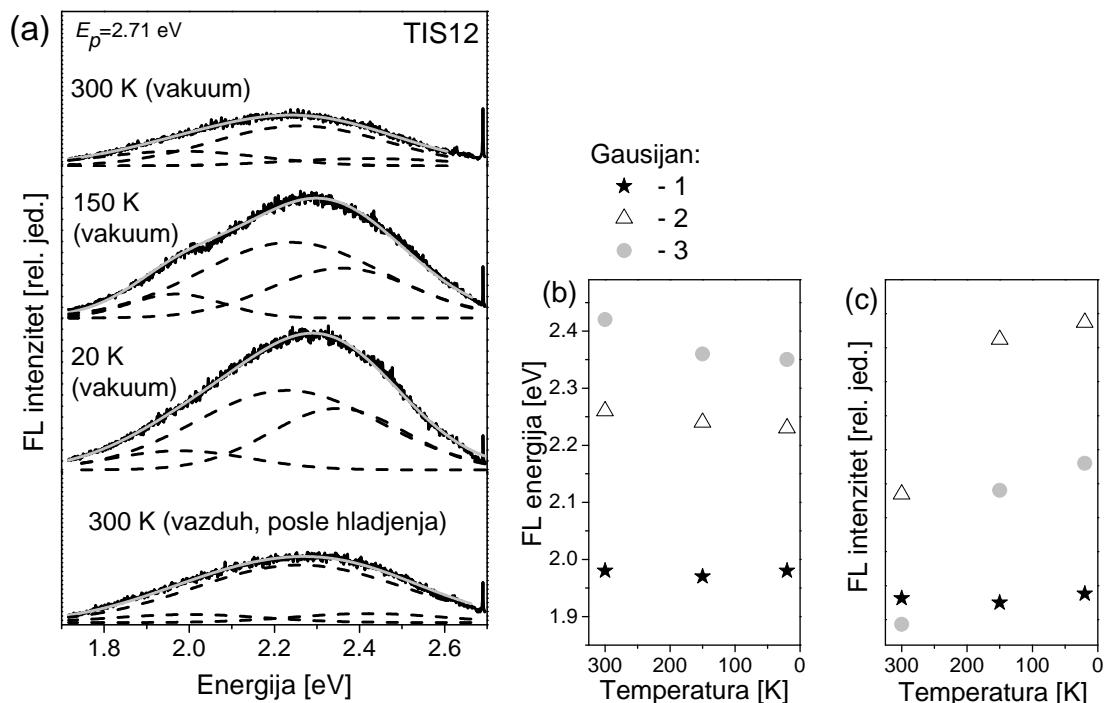
intenziteta odgovarajućih FL modova sa temperaturom prikazana je na Slikama 3.10(b) i (c). Intenzitet *prvog FL moda*, koji se pripisuje dvostrukim kiseoničnim vakancijama (~ 1.9 eV), u svim FL spektrima je veoma mali, a njegov se položaj ne menja bitno sa snižavanjem temperature. *Dруги FL мод* se sa snižavanjem temperature blago pomera ka nižim energijama (od 2.16 do 2.13 eV), dok njegov intenzitet raste do temperature od 150 K, a zatim blago opada. Ovakvo ponašanje odgovara FL emisiji, koja potiče od rekombinacije preko površinskih stanja u anatas TiO_2 , kada sa snižavanjem temperature dolazi do pomeraja moda ka nižim energijama i povećanja njegovog intenziteta, koji na oko 77 K postaje konstantan [35, 155]. Prikazana temperaturska zavisnost drugog FL moda još jedna je potvrda da je njegovo poreklo u ovim nanoprahovima povezano sa rekombinacijom preko površinskih stanja. Zapaža se da *treći FL mod* prikazan na Slici 3.10 ima najizraženiji pomeraj (od 2.4 eV na 300 K ka 2.29 eV na 20 K), kao i najveći porast intenziteta sa snižavanjem temperature. Kako su izraženi crveni pomeraj pri snižavanju temperature od ~ 300 do ~ 150 K [22], kao i kontinualno povećanje intenziteta sa snižavanjem temperature, karakteristike FL emisije anatas TiO_2 koja potiče od SZE⁴⁰ [22, 156], temperaturska zavisnost trećeg moda u ovim nanoprahovima potvrđuje da je njegovo poreklo zaista vezano za rekombinaciju preko SZE. Na osnovu do sada iznetih informacija, može se zaključiti da ponašanje FL spektara u zavisnosti od temperature u uzorku TIS57 određuje proces rekombinacije SZE, koji je u ovom uzorku dominantan pri navedenoj pobudi.

Promene intenziteta FL spektara kod uzorka TIS12 sa snižavanjem temperature odvijaju se na sličan način kao kod prethodnog uzorka TIS57, ali je pomeranje ovih spektara ka nižim energijama sa snižavanjem temperature znatno manje izraženo. Ovi spektri prikazani su na Slici 3.11(a) i takođe su fitovani zbirom tri gausijana, čije su promene položaja i intenziteta sa temperaturom date na Slikama 3.11(b) i (c). Za razliku od prethodnog uzorka, u FL spektrima uzorka TIS12 snimljenim u vakuumu, prisustvo *prvog FL moda*, pisanog dvostrukim kiseoničnim vakancijama, znatno je izraženije na svim temperaturama, pri čemu su promene intenziteta i položaja ovog moda sa snižavanjem temperature relativno male.

⁴⁰ Pomeranje FL moda, koji potiče od SZE, ka nižim energijama na niskim temperaturama pripisuje se lokalizaciji ekscitona na mestu njihovog nastanka u okviru TiO_6 oktaedra, dok se sa povećanjem temperature očekuje veća verovatnoća transfera ekscitona ka susednim lokacijama [22].



Slika 3.10. FL spektri uzorka TIS57 mereni u vakuumu na temperaturama 300, 150 i 20 K i u vazduhu nakon hladjenja na 300 K, fitovani sumom 3 gausijana (isprekidane linije) (a). Zavisnost položaja (b) i intenziteta (c) gausijana od temperature u vakuumu.



Slika 3.11. FL spektri uzorka TIS12 mereni u vakuumu na temperaturama 300, 150 i 20 K i u vazduhu nakon hladjenja na 300 K, fitovani sumom 3 gausijana (isprekidane linije) (a). Zavisnost položaja (b) i intenziteta (c) gausijana od temperature u vakuumu.

Drugi mod, pripisan rekombinaciji preko površinskih stanja, sa snižavanjem temperature ponaša se na sličan način kao odgovarajući mod u uzorku TIS57 - blago se pomera ka nižim energijama, dok do najvećeg porasta njegovog intenziteta dolazi pri promeni temperature sa 300 na 150 K. *Treći FL mod*, koji potiče od rekombinacije SZE, izrazitije se pomera ka nižim energijama, dok njegov intenzitet kontinualno raste sa snižavanjem temperature, što takođe odgovara ponašanju ovog moda u uzorku TIS57. Kako je u ovom uzorku intenzitet trećeg moda znatno manji od intenziteta drugog (što je posebno izraženo na sobnoj temperaturi), tako je temperaturska zavisnost FL spektara uzorka TIS12 određena prvenstveno ponašanjem drugog FL moda, pripisanog rekombinaciji posredstvom površinskih stanja.

Na osnovu prikazanih FL spektara može se zaključiti da u anatas TiO_2 nanoprahu, u kojem dominira SZE mod (TIS57), dolazi do izraženog pomeranja luminescencije prema nižim energijama sa snižavanjem temperature, dok je u nanoprahu, u čijim FL spektrima dominira rekombinacija posredstvom površinskih stanja (TIS12), ovo pomeranje znanto manje izraženo.

Eksperimentalni FL spektri pobuđeni vidljivom svetlošću, prikazani u ovom poglavlju, kao i analiza njihovog ponašanja u zavisnosti od energije i snage pobude, nestehiometrije i temperature, potvrđuju opravdanost uvođenja modela koji omogućava razdvajanje učešća pojedinih FL mehanizama kod anatas TiO_2 nanoprahova. Primena predloženog modela daje mogućnost prepoznavanja dominantnih defekata u pojedinim nanoprahovima na osnovu njihovih FL spektara. Ovi rezultati govore u prilog prepostavci da na sopstvene defekte u anatas TiO_2 nanoprahovima pre uticu uslovi sinteze, nego svojstva određena nanostrukturu [1]. Pored toga, prikazana luminescentna svojstva anatas TiO_2 nanoprahova pobuđenih vidljivom svetlošću, potvrđuju mogućnost njihove primene u fotokatalizi i fotoelektrohemijskoj konverziji vidljive svetlosti.

4. INFRACRVENA SPEKTROSKOPIJA OKSIDNIH NANOPRAHOVA

Infracrvena (IC) spektroskopija je važna nedestruktivna optička metoda, koja se koristi za karakterizaciju materijala, tj. određivanja vibracijskih svojstva kristalne rešetke i slobodnih nosilaca, odnosno zonske strukture. Pogodna je za analizu defekata u materijalu, kao i mikrostrukture složenih materijala. Ova metoda pokriva veoma širok opseg talasnih dužina - *blisku* ($14000\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$), *srednju* ($4000\text{-}400\text{ cm}^{-1}$) i *daleku* ($400\text{-}10\text{ cm}^{-1}$) infracrvenu oblast. Srednja IC oblast se veoma često koristi u vibracijskoj spektroskopiji, jer obuhvata region bogat informacijama u kome se većina materijala, kako neorganskih, tako i organskih identificuje na jedinstven način. Veoma je pogodna za detekciju fundamentalnih vibracija i vibracijsko-rotacionih struktura u materijalu. Daleka IC oblast, koja se graniči sa mikrotalasim regionom, primarno se koristi za detekciju postojanja veoma jakih veza, pre svega kod neorganskih materijala [157].

U poređenju sa ramanskom, IC spektroskopija daje komplementarne informacije. Proučavajući transverzalne i površinske optičke modove nanočestica i poredeći ih sa modovima odgovarajućeg kristalnog materijala, ovom tehnikom mogu da se dobiju sledeće informacije o nanomaterijalu: kristaličnost, uticaj dimenzije čestice, međuatomske veze koje učestvuju u formiranju nanočestice, hemijska priroda površinskih veza i površinskih grupa, moguće prisustvo nečistoća na površini nanomaterijala i površinske reakcije i poroznost nanomaterijala. Tačan opis vibracijskih modova nanokristalnih materijala neophodan je za razumevanje elektron-fonon interakcija. Ova tehnika takođe je veoma korisna za proučavanje energijskog procepa poluprovodnika i fotonskih kristalnih struktura i naprava u bliskoj IC oblasti i vidljivoj oblasti spektra.

4.1. Teorijske osnove infracrvene spektroskopije

Kako je već opisano u Poglavlju 2.1, kod nekih vibracija kristalne rešetke dolazi do promene *dipolnog momenta* rešetke, pa one postaju aktivne u IC spektru. Učestanosti fonona aktivnih u IC spektru uglavnom su određene kratkodometnim silama u rešetki, dok na fonone sa talasnim dužinama velikim u poređenju sa parametrima rešetke, ove interakcije ne utiču. Tokom vibracijskog kretanja nanelektrisanja može doći do periodične promene njegove raspodele, koja u opštem slučaju rezultuje odgovarajućom promenom dipolnog momenta⁴¹. Dipolni moment μ za nanelektrisanja $+Z$ i $-Z$, koja se nalaze na međusobnom rastojanju d , u opštem obliku se definiše kao

$$\vec{\mu} = Z \cdot \vec{d} . \quad (4.1)$$

Iz razvoja ukupnog dipolnog momenta $\vec{p} = \vec{\mu} + \alpha \vec{E}$ u Taylorov red, datog jednačinom (2.3) u Poglavlju 2.1, do aktivnosti u IC spektru, tj. do promene dipolnog momenta molekula pri vibraciji sa učestanošću ω_n , dolazi kada je ispunjen uslov da je odgovarajući član razvoja prvog reda, izvod dipolnog momenta po normalnoj koordinati

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial q_n} \right)_{q=0} \neq 0 , \quad (4.2)$$

gde je n -ta normalna koordinata oscilujućeg molekula sa amplitudom q_{n0} data izrazom $q_n(t) = q_{n0} \cos(2\omega_n \cdot t / \pi)$. Kao i u slučaju Ramanovog rasejanja, IC aktivnost strogo je definisana selepcionim pravilima u zavisnosti od strukture, odnosno simetrije kristalne rešetke [74, 158].

Na osnovu zakona održanja energije, intenzitet upadnog zračenja u uzorku (I_0) povezan je sa apsorbovanim (I_A), transmitovanim (I_T) i reflektovanim (I_R) zračenjem sledećom relacijom [78]:

$$I_R + I_T + I_A = I_0 . \quad (4.3)$$

Deljenjem ove jednačine sa I_0 , dobija se uobičajena veza $R + T + A = 1$, gde su relativne vrednosti: R - refleksivnost, T - transmitivnost i A - apsorptivnost uzorka. Merenjem R i T mogu se odrediti optičke konstante materijala, kao što su dielektrična propustljivost i indeks prelamanja. Kompleksna dielektrična propustljivost definisana je u obliku:

⁴¹ Nije neophodno da struktura ima stalni dipolni moment da bi njene vibracije bile aktivne u IC spektru.

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i \cdot \varepsilon_2(\omega), \quad (4.4)$$

gde njen realni deo $\varepsilon_1(\omega)$ opisuje disperzivne, a imaginarni $\varepsilon_2(\omega)$ apsorpcione karakteristike materijala, dok je kompleksni indeks prelamanja dat sa:

$$\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + i \cdot k(\omega), \quad (4.5)$$

gde je $n(\omega)$ realni indeks prelamanja, a $k(\omega)$ koeficijent ekstinkcije [78]. Realni i imaginarni deo kompleksne funkcije dielektrične propustljivosti i indeksa prelamanja povezani su na sledeći način:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1(\omega) &= n(\omega)^2 - k(\omega)^2, \\ \varepsilon_2(\omega) &= 2n(\omega) \cdot k(\omega). \end{aligned} \quad (4.6)$$

Ukoliko je IC zračenje reflektovano u "skoro" normalnom pravcu u odnosu na ravan uzorka, i pod uslovom da se transmitivnost može zanemariti, refleksivnost $R(\omega)$ je povezana sa indeksima prelamanja $n(\omega)$ i $k(\omega)$ na sledeći način [78]:

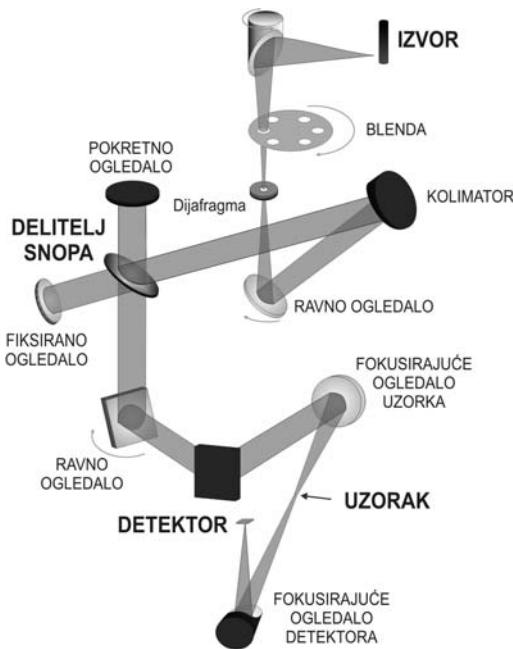
$$R(\omega) = \frac{(n(\omega) - 1)^2 + k(\omega)^2}{(n(\omega) + 1)^2 + k(\omega)^2}. \quad (4.7)$$

Zavisnost učestanosti dielektrične funkcije je ključna za razumevanje elektronskih i optičkih svojstava materijala, pri čemu je od posebnog interesa izučavanje nehomogenih dielektričnih mešavina, sa malom dimenzijom čestica u poređenju sa talasnom dužinom [159]. Analizom refleksivnosti u IC spektru, odnosno odgovarajućih dielektričnih funkcija, može se dobiti precizan uvid u strukturu materijala, odnosno karakteristične učestanosti vibracija rešetke, a znajući vibracijske učestanosti moguće je izračunati i međusobni položaj i jačine veza između atoma u kristalu [78].

4.2. Opis uređaja za infracrvenu spektroskopiju

Merenja spektara refleksije (transmisije) u infracrvenoj oblasti spektra elektromagnetskog zračenja najčešće se obavljaju uz pomoć Fourier-ovog spektrometra, koji kao disperzioni elemenat, umesto rešetke, koristi Michelsonov interferometar [157]. Prednost interferometrije nalazi se u činjenci da se interferometrom detektuje ceo spektralni opseg talasnih dužina, za razliku od disperzionog metoda gde se merenje vrši korak po korak "skenirajući" talasne dužine. Osnovni princip Fourieove spektroskopije,

odnosno Michelson-ovog interferometra zasniva se na interferenciji svetlosnih talasa. Opis optičkog puta svetlosti pri transmisionim merenjima kod BOMEM DA 8 spektrometra, koji je se nalazi u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku, prikazan je na Slici 4.1.



Slika 4.1 Optički put kod BOMEM DA 8 spektrometra.

Svetlosni snop se iz izvora usmerava kroz optički filter u interferencionu komoru. Tu se svetlost pomoću dielektričnog delitelja snopa deli na dva snopa jednakih intenziteta. Jedan deo svetlosnog snopa se usmerava na nepomično ogledalo, dok se drugi odbija od pokretnog ogledala i ponovo pada na delitelj. Snop svetlosti, koji pada na nepomično ogledalo, reflektuje se od njega i vraća na delitelj. Posle ponovnog prolaska kroz delitelj snopa, ova dva snopa interferiraju formirajući jedan snop, koji se fokusira na uzorak. Reflektovana (ili transmitovana) svetlost, koja napušta uzorak, usmerava se sistemom sočiva i ogledala na detektor. Interferencijski signal iz detektora se pojačava pojačavačem i obrađuje na računaru, gde je prikazan u vidu interferograma $I(x)$. Dva dela upadnog snopa prelaze različite optičke puteve, tako da je fazna razlika između njih $2\pi\sigma x$, gde je σ - talasni broj ($\sigma = 1/\lambda$), a x - putna razlika dva zraka. Kada je putna razlika $x = 0$, to je uslov za konstruktivnu interferenciju i dva snopa, koja padaju na

uzorak, su u fazi. Tada se na detektoru registruje maksimalan signal. Pomeranjem ogledala menja se postepeno putna razlika, tako da u jednom trenutku signal koji dospeva u detektor pada na minimum. Signal prolazi kroz maksimume i minimume, pri čemu je svaki sledeći maksimum sve niži. Kriva koja se dobija na ovaj način predstavlja interferogram. Interferogram je dat izrazom [160]:

$$I(x) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\sigma) \exp(2\pi i \sigma x) \cdot d\sigma \quad (4.8)$$

Fourieovom transformacijom interferograma uz pomoć odgovarajućeg softvera, kojim raspolaže kompjuter kao sastavni deo spektrometra, dobija se željeni spektar u obliku:

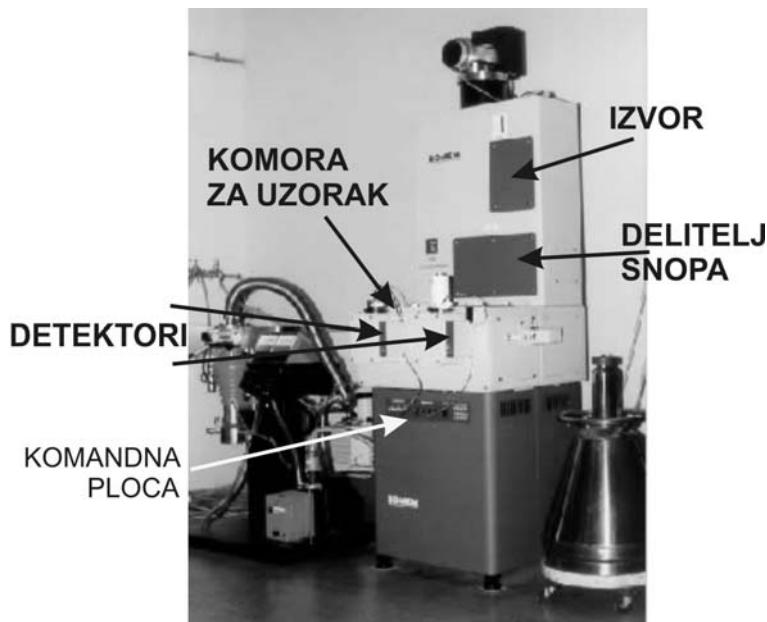
$$S(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} I(x) \exp(-2\pi i \sigma x) \cdot dx \quad (4.9)$$

Potrebno je uvek meriti dva spektra, jedan sa uzorkom i jedan bez njega. Količnik ta dva spektra u stvari je spektar merenog uzorka. Integral u jednačini (4.9) nije poznat za sve vrednosti x od $-\infty$ do $+\infty$. Merenja se vrše samo u opsegu kretanja ogledala od $-x$ do x , što i određuje rezoluciju Fourieovog spektrometra $\Delta x \equiv 1/x$ [160].

Spoljni izgled spektrometra BOMEM DA 8 dat je na Slici 4.2.

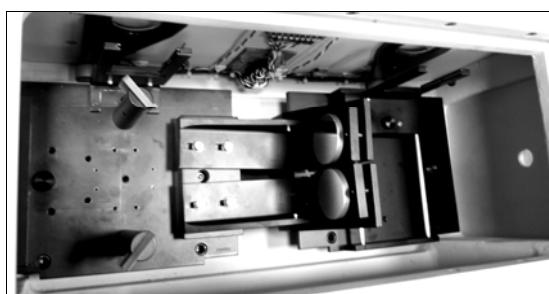
U gornjem delu instrumenta se nalazi izvor IC zračenja i delitelj snopa (*beamsplitter*). Izvor može biti živina lampa za daleku IC oblast, globar za daleku i srednju IC oblast i kvarcna lampa za vidljivi deo spektra. U srednjem delu spektrometra nalaze se refleksiona i transmisiona kutija sa nosačem uzorka i sistemom za fokusiranje upadnog snopa na uzorak i od uzorka na detektor. U donjem delu uređaja su izvor napajanja, vakuum izvodi i elektronika za kontrolu eksperimenta i obradu podataka. Merni opseg ovog spektrometra obuhvata daleku i srednju IC oblast (od 10 do 5000 cm^{-1}) sa maksimalnom rezolucijom 0.05 cm^{-1} . Promenom izvora, delitelja snopa i detektora vrši se promena spektralnog opsega. Za IC oblast od $10-100 \text{ cm}^{-1}$ kao delitelj snopa koristi se MYLAR 25. Od $30-1000 \text{ cm}^{-1}$ koristi se HYPERSPLITTER, a od $400-5000 \text{ cm}^{-1}$ kalijum bromidni (KBr) delitelj snopa. Detektor DTGS koristi se za daleku IC oblast, a MCT za srednju IC oblast. Uređaj je povezan sa kompjuterom, čijim softverom se upravlja spektrometrom i obradom merenih podataka. Ovim uređajem mogu se vršiti merenja i polarisanom svetlošću u širokom temperaturskom opsegu od

4.2 K do 300 K, budući da je uređaj opremljen i kriostatom za niske temperature marke JANIS STDA 100 (LN₂ i LHe).



Slika 4.2. Izgled spektrometra BOMEM DA 8

Na Slici 4.3 prikazana je refleksiona kutija, koja služi za merenje spektara refleksije. Uzorak ili ogledalo se stavlja na nosač u centralnom delu u kome se nalazi i kriostat. Svetlosni zrak iz izvora odbija se o ravno ogledalo, pa zatim o sferno, koje ga fokusira na uzorak. Svetlost sa uzorka ide na drugo sferno ogledalo, koje usmerava zrak preko još jednog ravnog ogledala na detektor. Ovim uređajem moguće je meriti i transmisione spektre.



Slika 4.3 Izgled refleksione kutije BOMEM DA 8 spektrometra.

4.3. Numeričke metode analize IC spektara refleksije

4.3.1. Četvoroparametarski model

Jedna od metoda za analizu spektara refleksije je *numeričko usaglašavanje eksperimentalne krive refleksivnosti i teorijskog modela*, bazirano na modelu kompleksne dielektrične funkcije $\epsilon(\omega)$, koje će biti detaljnije opisano u ovom poglavlju.

Na osnovu Maxwell-ovih jednačina, odnosno Lyddane-Sachs-Teller-ove relacije (LST), razvijen je *faktorizovani oblik dielektrične funkcije*, koji uzima u obzir mnoge vrste ekscitacija, registrovanih kod oksidnih materijala [7, 24, 78, 161-164]. Ovaj oblik podrazumeva da je dielektrična funkcija kompleksna, sa kompleksnim TO učestanostima kao polovima, a kompleksnim LO učestanostima kao nulama funkcije. Uobičajeno je da se za određivanje dielektrične funkcije koristi sledeća jednačina [7, 24, 164]:

$$\epsilon = \epsilon_{\infty} \prod_n \frac{\omega_{\text{LO}_n}^2 - \omega^2 + i\gamma_{\text{LO}_n}\omega}{\omega_{\text{TO}_n}^2 - \omega^2 + i\gamma_{\text{TO}_n}\omega} = \epsilon_1 - i \cdot \epsilon_2, \quad (4.10)$$

gde su fitujući parametri ω_{TO_n} i ω_{LO_n} TO i LO učestanosti n oscilatora, sa odgovarajućim faktorima prigušenja, γ_{TO_n} , γ_{LO_n} , redom, dok je ϵ_{∞} visokofrekventna dielektrična konstanta. Ova metoda za analizu refleksionih spektara veoma se često koristi prilikom određivanja optičkih parametara oscilatora, a zbog broja parametara poznata je i pod imenom *četvoroparametarski model*. Prednosti ovog modela mnogo puta je potvrdio Gervais sa saradnicima [24, 161-163], primenjujući ga na velikom broju materijala, od kojih je jedan bio i rutil TiO_2 [24]. Njegova primena kod većeg broja titanata (BaTiO_3 , SrTiO_3 i KTiO_3) [165] i samog TiO_2 (rutil i anatas) [7], čiji IC refleksioni spektri kao zajedničku karakteristiku imaju široke refleksione krive, odnosno dovoljno razdvojene TO i LO učestanosti (jonski kristali), pokazala je veoma dobre rezultate. Jednostavnost ovog modela ogleda se najviše u tome što se TO i LO učestanosti dobijaju kao direktni rezultat procesa modeliranja dielektrične funkcije, tj. IC spektra refleksije: podešavanjem parametara oscilatora, teorijska kriva IC refleksije dovodi se do poklapanja sa eksperimentalnom krivom. Postupak modelovanja olakšan je činjenicom da su TO i LO učestanosti locirane na nisko- i visokofrekventnoj granici

odgovarajuće refleksione trake, a parametri prigušenja praktično su odgovarajući nagibi ovih ivica [7].

4.3.2. Četvoroparametarski model sa plazmon-fonon interakcijom

Dielektrična funkcija izotropnog sistema sa višestrukim modovima, koja opisuje sparivanje m plazmona i n LO fonona ima oblik [166]⁴²:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\prod_{j=1}^{m+n} (\omega^2 - \omega_{LOj}^2 + i\gamma_{LOj}\omega)}{\omega^m \prod_{j=1}^m (\omega + i\gamma_{Pj}) \prod_{j=1}^n (\omega^2 - \omega_{TOj}^2 + i\gamma_{TOj}\omega)}, \quad (4.11)$$

gde su ω_{LOj} i γ_{LOj} sopstvene učestanosti i koeficijenti prigušenja $m+n$ spregnutih plazmon-LO fonon modova, γ_P je koeficijent prigušenja plazme, a ω_{TOj} i γ_{TOj} sopstvene učestanosti i koeficijenti prigušenja n TO fononskih modova.

Iako interesantan sam po sebi, fenomen plazmon-LO fonon sparivanja maskira individualna svojstva plazmona i fonona u materijalu. Dielektrična funkcija ovakvog sistema može se razložiti na sumu dva nezavisna člana, od kojih jedan predstavlja čist fononski doprinos dat jednačinom (4.10), koji korektno opisuje fononsku refleksiju, a drugi daje doprinos čistog plazmona, predstavljen Drude-ovom formulom [24, 167]. U slučaju jednokomponentne plazme ($m=1$), dielektrična funkcija se razlaže na sledeći način [167]:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\omega) &= \varepsilon_1(\omega) - i \cdot \varepsilon_2(\omega) = \\ &= \varepsilon_{\infty} \left(\prod_{j=1}^n \frac{\omega_{LOj}^2 - \omega^2 + i\omega\gamma_{LOj}}{\omega_{TOj}^2 - \omega^2 + i\omega\gamma_{TOj}} - \frac{\omega_P^2 + i\omega(\gamma_P - \gamma_0)}{\omega^2 - i\omega\gamma_0} \right), \end{aligned} \quad (4.12)$$

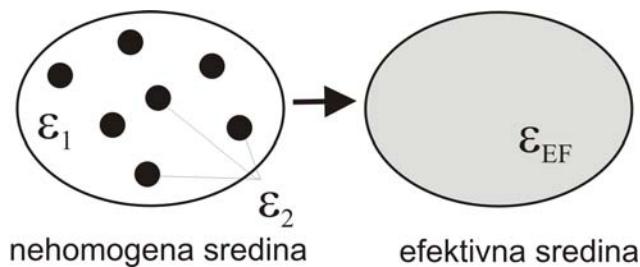
što je modifikacija već poznatog četvoroparametarskog modela iz jednačine (4.10). U jednačini (4.12) kod parametara plazmona postoji razlika između faktora prigušenja γ_P na učestanosti plazme ω_P i "statičkog" faktora prigušenja γ_0 na nultoj učestanosti, što predstavlja poboljšan oblik klasične Drudeove formule [167].

⁴² Znaci u ovoj formuli odgovaraju obliku dielektrične funkcije $\varepsilon_1(\omega) + i \varepsilon_2(\omega)$.

4.3.3. Fenomenološka teorije efektivne sredine

Ukoliko je talasna dužina elektromagnetskog zračenja mnogo veća od dimenzije čestice, višekomponentni materijal se u klasičnoj teoriji nehomogene sredine može posmatrati kao homogena sredina sa efektivnom dielektričnom disperzionom funkcijom, kako je ilustrovano na Slici 4.4. Ova veličina zavisiće od svojstava pojedinih materijala koji ulaze u sastav višekomponentnog materijala, kao i njihovog zapreminskog udela i dimenzija čestica [168].

Postoji nekoliko modela efektivne sredine, koji se široko koriste kod različitih mikrostruktura sa nehomogenim uređenjem [7, 159, 169], kao što su mešavina dva materijala sa sfernim česticama, čestice jednog materijala inkorporirane u matricu drugog materijala, lamelarne strukture itd. Ovi modeli se često koriste i za modelovanje neravne površine materijala, koja se posmatra kao kombinacija čvrstog materijala i vazduha u prostoru, sa različitim zapreminskim udelom u okviru slojeva materijala u površini. U narednim poglavljima biće prikazane Bruggeman-ova i generalisana Bruggeman-ova fenomenološka teorija efektivne sredine⁴³ (u daljem tekstu FTES), koje su korišćene za analizu refleksionih spektara anatas TiO₂ nanoprahova.



Slika 4.4. Ilustracija modelovanja dvokomponentne nehomogene sredine efektivnom sredinom.

⁴³ Effective medium approximation (EMA).

4.3.3.1. Bruggeman-ov model

Bruggeman-ova fenomenološka teorija efektivne sredine određuje efektivnu dielektričnu funkciju $\varepsilon_{EF}(\omega)$ za binarni neuređeni materijal, koji se sastoji od 2 različita materijala, A i B , sa dielektričnim funkcijama $\varepsilon_A(\omega)$ i $\varepsilon_B(\omega)$ i koncentracijama (odnosno zapreminskim učešćem) f_A i f_B u sledećem obliku [159, 170]:

$$\left(\frac{\varepsilon_A - \varepsilon_{EF}}{\varepsilon_A + 2\varepsilon_{EF}} \right) f_A + \left(\frac{\varepsilon_B - \varepsilon_{EF}}{\varepsilon_B + 2\varepsilon_{EF}} \right) f_B = 0, \quad (4.13)$$

gde važi $f_A + f_B = 1$. Ova jednačina ispunjava samousaglašeni uslov $\varepsilon_{EF}(0)=\varepsilon_0$ [159] i simetrična je u odnosu na materijale A i B , koji sačinjavaju mešavinu. Uzimajući u obzir da je dielektrična funkcija kompleksna, ovde se suočavamo sa rešavanjem kvadratne jednačine (ili jednačine većeg stepena, u slučaju mešavine 3 i više materijala). To zahteva pravilan izbor grane, tj. rešenja iz skupa mogućih kompleksnih rešenja, primenom odgovarajuće numeričke procedure na svakoj pojedinačnoj talasnoj dužini spektra [7, 169, 171]. Praktičan problem numeričkog rešavanja $\varepsilon_{EF}(\omega)$ nije jednostavan, naprotiv, kod različitih kombinacija konkretnih materijala sa različitim svojstvima, često se rešavaju jedinstveni problemi, direktno vezani za svojstva mešavine i njenih konstituenata [7, 169].

4.3.3.2. Generalisani Bruggeman-ov model

Generalisane teorije efektivne sredine omogućavaju da se pri modelovanju dieletrične funkcije efektivnog materijala uzme u obzir i oblik čestica materijala. Kada se modeluje materijal sastavljen od komponenata A i B , takav da su čestice materijala B inkorporirane u materijal A , u generalisanoj Bruggeman-ovoj FTES koristi se još jedan dodatni parametar, tzv. faktor depolarizacije L . Za vrednost $L=1/3$, tj. kada su čestice materijala sfernog oblika, generalisani model svodi se na Bruggeman-ov model dat jednačinom (4.13). Za vrednosti $1/3 < L < 1$, odnosno izdužene sferoidne čestice materijala, Bruggeman-ova jednačina (4.12) dobija sledeći oblik [159]:

$$\left(\frac{\varepsilon_A - \varepsilon_{EF}}{\varepsilon_{EF} + L(\varepsilon_A - \varepsilon_{EF})} \right) f_A + \left(\frac{\varepsilon_B - \varepsilon_{EF}}{\varepsilon_{eff} + L(\varepsilon_B - \varepsilon_{EF})} \right) f_B = 0, \quad (4.14)$$

gde je A nanomaterijal sa dielektričnom funkcijom $\varepsilon_A(\omega)$ i zapreminskim udelom f_A , a čestice materijala B , opisuju se dielektričnom funkcijom $\varepsilon_B(\omega)$ i zapreminskim udelom $f_B=1-f_A$.

4.4. Modelovanje IC spektara nanoprahova

Modelovanje IC spektara nanoprahova polazi od spektra odgovarajućeg monokristalnog materijala, uzima u obzir polikristalni karakter nanopraha i uključuje poroznost praha kao parametar. U ovom poglavlju biće prikazan razvoj ovog modela na primeru anatas TiO_2 nanopraha.

4.4.1. IC spektar anatas TiO_2 monokristala

Kao što je navedeno u Poglavlju 1.1.1, tri vibracijska moda su aktivna u IC spektru anatas TiO_2 monokristala: A_{2u} mod je aktivan kada je upadna svetlost polarizovana paralelno c osi ($E \parallel c$), dok su $E_u(1)$ i $E_u(2)$ modovi aktivni u normalnoj polarizaciji svetlosti ($E \perp c$) [2, 5-7].

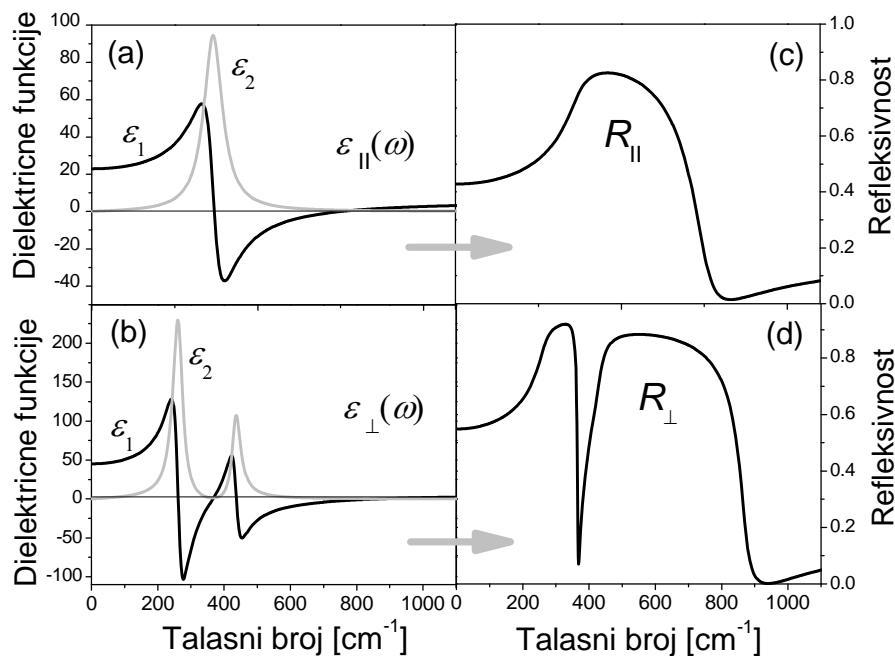
Tabela 4.1. Parametri oscilatora korišćeni u proračunima dielektričnih funkcija i IC refleksivnosti anatas TiO_2 monokristala u paralelnoj i normalnoj polarizaciji [2, 7].

Polarizacija	IC modovi	Parametri oscilatora		
		ω [cm ⁻¹]	γ [cm ⁻¹]	ε_∞
Paralelna	A_{2u}	TO	367	68
		LO	755	79
	$E_u(1)$	TO	262	36
		LO	366	4.1
Normalna	$E_u(2)$	TO	435	32
		LO	867	5.82

Dielektrične funkcije, koje su vezane za paralelnu i normalnu polarizaciju i odgovaraju eksperimentalnim rezultatima koje su za anatas TiO_2 monokristal dali Gonzalez, Zallen

i Berger [2], prikazane su na Slici 4.5. Ove funkcije dobijene su primenom četvoroparametarskog modela, odnosno jednačine (4.10). Na Slikama 4.5(a) i (b) prikazani su realni $\varepsilon_1(\omega)$ i imaginarni $\varepsilon_2(\omega)$ delovi odgovarajućih dielektričnih funkcija. Spektri IC refleksivnosti (R) anatas TiO_2 u paralelnoj i normalnoj polarizaciji, računati u skladu sa jednačinama (4.4-4.7), prikazani su na Slikama 4.5(c) i (d).

Parametri oscilatora (TO i LO učestanosti, zajedno sa odgovarajućim faktorima prigušenja), koji odgovaraju anatas TiO_2 monokristalu u zavisnosti od primenjene polarizacije, prikazani su u Tabeli 4.1 [2]. Odgovarajuće visokofrekventne dielektrične konstante (ε_∞) takođe su preuzete iz literature [2, 7] i prikazane u Tabeli 4.1.



Slika 4.5. Dielektrične funkcije anatas TiO_2 monokristala u paralelnoj (a) i normalnoj polarizaciji (b) i spektri IC refleksivnosti u paralelnoj (c) i normalnoj polarizaciji (d), računate prema Gonzalez et al. (ref. [2]).

4.4.2. Modelovanje polikristalne prirode nanopraha

Nanoprah se, usled slučajne orijentacije nanokristalita, pre svega mora posmatrati kao polikristal sastavljen od velikog broja različito orijentisanih kristalita. Zbog toga će u ovom poglavlju biti prikazana primena Bruggeman-ove FTES kod modelovanja IC spektara polikristalne strukture. Imajući u vidu ukupnu, statistički

slučajnu orijentaciju kristalita u polikristalnom materijalu, optička svojstva, koja su povezana sa svakom od uzajamno normalnih osa, daju jednak doprinos ukupnoj optičkoj aktivnosti [172, 173]. Budući da su kod uniaksijalnih kristala (kakav je i anatas TiO_2) dve od tri ose ekvivalentne ($a=b\neq c$), polikristal se može posmatrati kao materijal u kome je $1/3$ kristalita orijentisana tako da se c osa poklapa sa pravcem upadne svetlosti, dok je $2/3$ kristalita sa c osom normalnom na taj pravac [7, 172, 173].

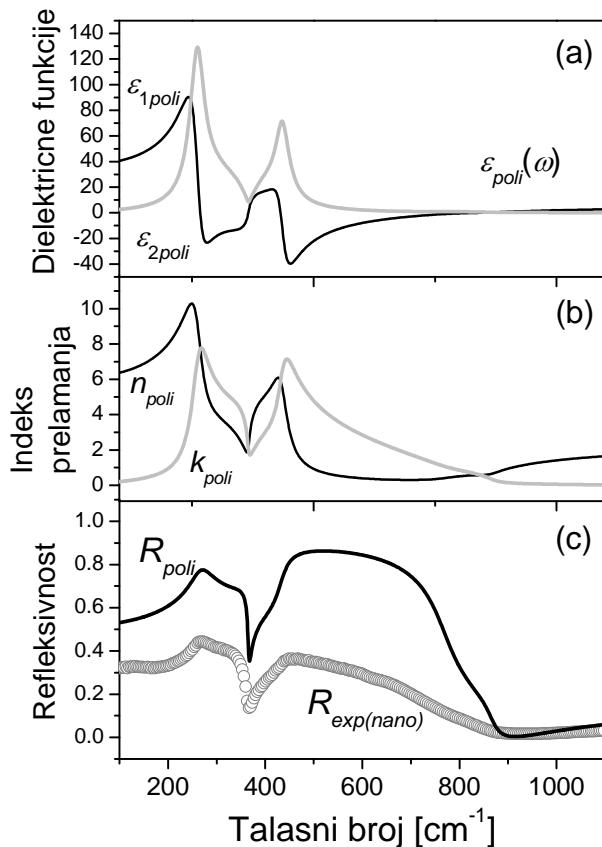
Za određivanje dielektrične funkcije kod polikristala sa sfernim kristalitima najčešće se koristi Bruggeman-ov model. Na osnovu tog modela, polikristal se posmatra kao fiktivni kompozit sastavljen od dva materijala: jednog sa dielektričnom funkcijom $\varepsilon_A=\varepsilon_{||}(\omega)$ i zapreminskim učešćem $f_A=f_{||}=1/3$ i drugog, sa $\varepsilon_B=\varepsilon_{\perp}(\omega)$ i $f_B=f_{\perp}=2/3$. [7, 172]. Tada se Bruggeman-ova jednačina (4.12) može predstaviti u obliku:

$$\left(\frac{\varepsilon_{||} - \varepsilon_{poli}}{\varepsilon_{||} + 2\varepsilon_{poli}} \right) \frac{1}{3} + \left(\frac{\varepsilon_{\perp} - \varepsilon_{poli}}{\varepsilon_{\perp} + 2\varepsilon_{poli}} \right) \frac{2}{3} = 0, \quad (4.15)$$

a njeno rešenje je kompleksna efektivna dielektrična funkcija polikristala $\varepsilon_{poli}(\omega)$. Dielektrične funkcije $\varepsilon_{||}(\omega)$ i $\varepsilon_{\perp}(\omega)$ odgovaraju dielektričnim funkcijama monokrostala u paralelnoj i normalnoj polarizaciji. U slučaju anatas TiO_2 monokristala, ove funkcije su dobijene primenom četvoroparametarskog modela i prikazane su na Slikama 4.5.(a) i (b), a odgovarajući parametri oscilatora dati su u Tabeli 4.1. Na osnovu njih je dobijena efektivna dielektrična propustljivost $\varepsilon_{poli}(\omega)$ polikristalnog anatas TiO_2 nanopraha. Na Slici 4.6(a) prikazani su realni (ε_{1poli}) i imaginarni (ε_{2poli}) deo efektivne dielektrične funkcije polikristala, dobijene primenom jednačine (4.10). Odgovarajuće komponente kompleksnog indeksa prelamanja svetlosti (n_{poli}, k_{poli}) dobijene iz jednačina (4.6) prikazane su na Slici 4.6.(b). Refleksioni IC spektar polikristala anatas TiO_2 (R_{poli}), koji neposredno sledi iz krivih na Slikama (a) i (b), odnosno iz jednačine (4.7) iz Poglavlja 4.1. prikazan je na Slici 4.6(c).

Zajedno sa modelovanim spektrom refleksivnosti polikristala anatas TiO_2 prikazan je i eksperimentalni spektar jednog anatas TiO_2 nanopraha. Pokazalo se da ne postoji takav izbor parametara oscilatora anatas TiO_2 kojim se ova dva spektra mogu dovesti do poklapanja. Kada su u pitanju polikristali i kompaktni kompoziti, tada je primena Bruggeman-ovog modela opravdana i dovoljna za modelovanje IC spektra. Međutim, kada je u pitanju porozni nanoprah, sa relativno velikom specifičnom

površinom, u modelovanje efektivne dielektrične funkcije mora se uključiti i odgovarajuća poroznost, odnosno prisustvo vazduha u materijalu.



Slika 4.6. Efektivna dielektrična funkcija (a), indeks prelamanja (b) i spektar refleksije (c) anatas TiO₂ polikristala, računati prema Gonzalez et al. (ref. [7]).

4.4.3. Modelovanje IC spektara poroznog anatas TiO₂ nanopraha

Analiza nanokristalnih materijala pomoću IC spektroskopije, pored informacija o površini i zapremini materijala, treba da da uvid i u njegovu nanostrukturu. Eksperimentalni i teorijski rezultati, koji se tiču primene ove metode za karakterizaciju anatas TiO₂ nanoprahova nesrazmerno su retki u literaturi, posebno u dalekoj IC oblasti. Gonzalez sa saradnicima [2, 7] praktično je prvi predstavio rezultate merenja IC refleksije u dalekoj oblasti na uzorcima anatas TiO₂ presovanog nanopraha, dobijenog sol-gel metodom. Oni su predložili model analize IC spektra, koji polazi od

dielektričnih funkcija monokristalnog anatas TiO_2 i uvodi polikristalni karakter nanopraha primenom Bruggeman-ove FTES, na način opisan u prethodnim poglavljima. Specifičnost modelovanja nanokristala uvedena je preko efekta nepravilnosti površine, gde se pretpostavlja da se u površinskom sloju nanomaterijala učešće nanopraha i vazduha postepeno menja i gde je kao poseban parametar uvedena ukupna debljina površinskog sloja [7, 172]. Pokazalo se da je ova metoda pogodna za određivanje dielektrične funkcije tankih filmova, ali ne i za presovane nanoprahove [174]. Naime, ovom metodom jeste postignuto izvesno slaganje sa eksperimentalnim spektrom (ili su bar dobijene osnovne karakteristike), ali ne i dovoljno dobro kvantitativno slaganje sa eksperimentalnim rezultatima za porozni nanoprah [7, 174]. Generalisani Bruggemanov model, koji će biti prikazan u ovom poglavlju, osim boljeg slaganja, ima drugu važnu prednost - on obuhvata i mikrostrukturne karakteristike nanoprahova, kao što su poroznost nanopraha i oblik nanočestica i pora, te je zato pogodniji za interpretaciju IR spektra poroznog nanomaterijala.

Tabela 4.2. Parametri oscilatora korišćeni u proračunima dielektričnih funkcija i IC refleksivnosti u paralelnoj i normalnoj polarizaciju upadnog zračenja [174]. Ovi podaci se odnose na IC spektar uzorka TIS57.

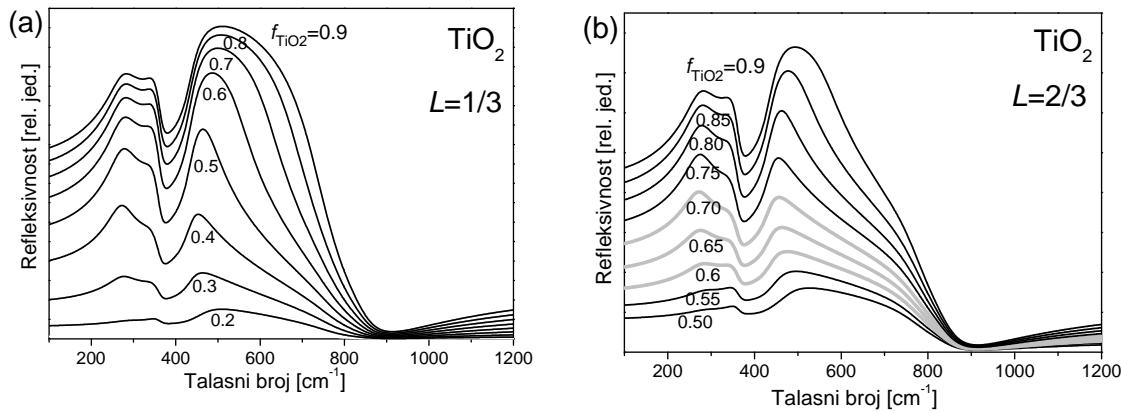
Polarizacija	IC modovi	Parametri oscilatora		
		$\omega \text{[cm}^{-1}]$	$\gamma \text{[cm}^{-1}]$	ϵ_{∞}
Paralelna	A_{2u}	TO	347	50
		LO	755	100
	$E_u(1)$	TO	272	60
		LO	365	2.8
Normalna	$E_u(2)$	TO	438	50
		LO	850	100

U ovom slučaju porozni nanoprah se posmatra kao kompozit polikristalnog materijala (u ovom slučaju anatas TiO_2) sa dielektričnom funkcijom $\epsilon_{\text{TiO}_2}(\omega)$ i vazduha ($\epsilon_V(\omega)=1$). Tada ranije opisana Bruggeman-ova jednačina (4.14) dobija oblik:

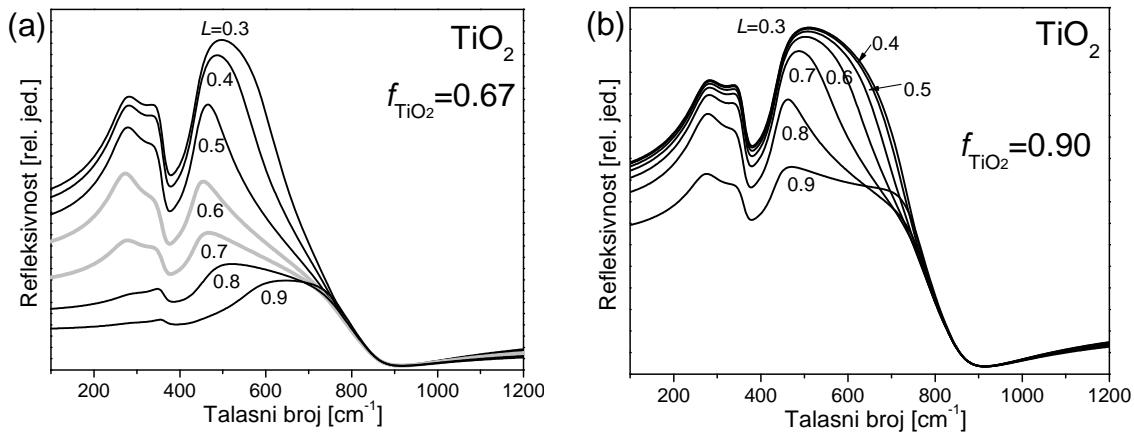
$$\left(\frac{\epsilon_{\text{TiO}_2} - \epsilon_{\text{nano}}}{\epsilon_{\text{nano}} + L(\epsilon_{\text{TiO}_2} - \epsilon_{\text{nano}})} \right) f_{\text{TiO}_2} + \left(\frac{\epsilon_V - \epsilon_{\text{nano}}}{\epsilon_{\text{nano}} + L(\epsilon_V - \epsilon_{\text{nano}})} \right) f_V = 0, \quad (4.16)$$

gde su f_{TiO_2} i $f_V = 1 - f_{\text{TiO}_2}$ zapreminska učešće TiO_2 i vazduha, L faktor depolarizacije, tj. faktor oblika pora ispunjenih vazduhom, a $\varepsilon_{\text{nano}}(\omega)$ dielektrična funkcija poroznog nanopraha.

Uticaj uvedenih parametara na modelovane IC spekture biće analiziran na primeru jednog anatas TiO_2 nanopraha (TIS57), čiji parametri oscilatora su prikazani u Tabeli 4.2.



Slika 4.7. Spektri refleksije poroznog anatas TiO_2 nanopraha prema generalisanom Brugemanovom modelu efektivne sredine, za udeo praha od 0.20 do 0.90, kada su pore sfernog oblika, $L=1/3$ (a) i udeo praha 0.50-0.90 i elipsoidni oblik pora, $L=2/3$ (b).



Slika 4.8. Spektri refleksije poroznog anatas TiO_2 nanopraha prema generalisanom Brugemanovom modelu efektivne sredine sa faktorom oblika L u opsegu od 0.33-0.90 i fiksiranim udelom nanopraha, $f_{\text{TiO}_2} = 0.67$ (a) i 0.90 (b).

Uticaj promene zapreminskog učešća nanopraha f_{TiO_2} za dve odabране vrednosti faktora oblika pora, L , prikazan je na Slici 4.7. Na Slici 4.7(a) dati su spektri refleksije za granični slučaj faktora $L=1/3$, gde su pore sfernog oblika ispunjenje vazduhom, kada se zapreminska učešća TiO_2 nanopraha menja u opsegu 0.20 do 0.90. Na Slici (b) prikazana je serija spektara računata sa dvostruko većom vrednošću faktora $L=2/3$ i učešćem TiO_2 nanopraha u opsegu od 0.50 do 0.90 i sa manjim korakom promene učešća nanopraha (0.05), da bi se preciznije uočio spektar refleksije koji odgovara realnim uzorcima anatas TiO_2 nanoprahova, o kojima će kasnije biti više reči.

Na Slici 4.8. prikazane su dve serije spektara dobijene promenom faktora oblika pora sa vazduhom L od sfernog ($1/3$) do potpuno izduženog oblika (0.9), gde je udeo nanopraha fiksiran, i to na vrednost $f_{\text{TiO}_2} = 0.67$ na Slici 4.8(a), odnosno na $f_{\text{TiO}_2} = 0.90$ na Slici (b). Nanoprahovi anatas TiO_2 koji će biti razmatrani u ovom radu uglavnom pripadaju opsegu udela nanopraha f_{TiO_2} od 0.60 do 0.70, sa faktorom oblika $L \sim 0.60-0.65$. Na Slikama 4.7(b) i 4.8.(a) krive koje pripadaju ovom opsegu istaknute su sivim debljim linijama. Ovi rezultati ilustruju uticaj parametara koji se uvode u fenomenološke teorije efektivne sredine sa ciljem da se obuhvati što veći broj mogućih svojstava materijala i njihov uticaj na oblik i ponašanje refleksionih IC spektrara. Na primeru anatas TiO_2 nanopraha može se uočiti promena relativnog intenziteta modova i promene u širini spektra sa promenom parametara karakterističnih za generalizovanu Bruggeman-ovu fenomenološku teoriju.

Uopšteno posmatrano, smanjenje zapreminskog udela nanopraha u kompozitu (f_{TiO_2}), u ovom slučaju poroznog anatas TiO_2 nanopraha rezultuje smanjenjem intenziteta refleksivnosti, kao i širenjem refleksionih spektara, usled prisustva veće količine vazduha u materijalu, bez obzira na vrednost faktora oblika L , kao što je prikazano na Slici 4.7. Fizičko značenje ovakvog ponašanja nalazi se u činjenici da manji zapreminski udeo TiO_2 nanopraha, odnosno veća poroznost, po pravilu odgovaraju prahovima sa manjom dimenzijom nanočestice. Poznato je takođe da usled manje dimenzije nanočestice dolazi do širenja spektara, pre svega usled anharmonijskog efekta [175].

Sa druge strane, pri fiksiranom udelu nanopraha, uticaj oblika pora sa vazduhom manifestuje se pre svega u izraženom uticaju na oblik spektra (Slika 4.8), porastu intenziteta kako se oblik pora približava sfernom [121, 174]. Povećavanje faktora L dovodi do sličnih efekata u IC spektru (pad intenziteta, širenje spektra), kakvi su već registrovani kod smanjenja koncentracije nanopraha, ali ova pojava još uvek nema jasno fizičko objašnjenje.

4.5. Poređenje eksperimentalnih i modelovanih IC spektara anatas TiO₂ nanoprahova

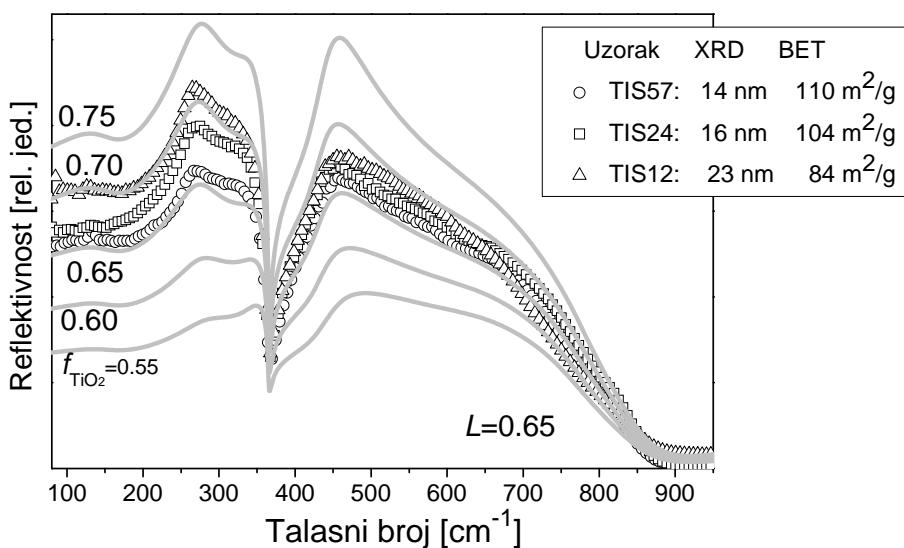
Kako je prikazano u prethodnim poglavljima, uticaj koncentracije nanopraha, odnosno vazduha u porama, i samog oblika pora na oblik IC spektra refleksije daje široke mogućnosti za primenu generalisanog Bruggeman-ovog modela u analizi spektara refleksije nanoprahova. U ovom poglavlju će biti prikazani eksperimentalni spektri anatas TiO₂ nanokristala i njihova analiza primenom opisanog modela, kako u slučaju približno stehiometrijskog, tako i nestehiometrijskog poroznog nanopraha.

4.5.1. Analiza IC spektara stehiometrijskih anatas TiO₂ nanoprahova

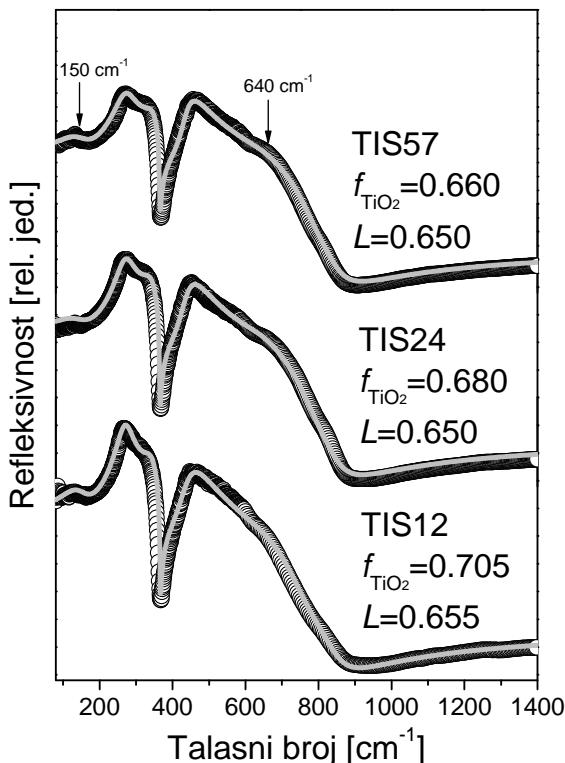
XRD spektari anatas TiO₂ nanoprahova prikazani su u Poglavlju 1.1.3.2, gde je pokazano da su karakteristični difrakcioni pikovi za anatas fazu TiO₂ prisutni u svim uzorcima. Srednje dimenzije nanokristalita, procenjene iz XRD spektara, su 14, 16 i 23 nm za TIS57, TIS24 i TIS12 redom, što se u velikoj meri poklapa sa rezultatima dobijenim BET merenjima, gde poroznosti, odnosno specifičnoj površini od 110, 104 i 84 m²/g odgovaraju redom dimenzije nanočestice od 14, 15 i 19 nm. Proračuni IC refleksivnosti zasnovani su na ovim procenama dimenzija nanočestica odnosno odgovarajućoj poroznosti nanoprahova [174]. SEM merenja uzoraka TIS12, 24 i 57, koji su predmet ovog istraživanja takođe su detaljno prikazana u Poglavlju 1.1.3.2. Analizom SEM

mikrograфа за navedene uzorke, ustanovljeno da većina kristalita u ovim uzorcima ima približno sferni oblik.

Na Slici 4.9. prikazani su eksperimentalni spektri refleksivnosti uzoraka TIS57, TIS24 i TIS12 (predstavljeni simbolima) zajedno sa rezultatima generalisane Bruggeman-ove FTES (puna linija), gde se za fiksiranu vrednost faktora oblika, $L=0.65$, koja približno odgovara ovim uzorcima, udeo nanopraha menja u opsegu od 0.55 do 0.75. Parametri oscilatora korišćeni u ovim proračunima prikazani su u Tabeli 4.2. Polikristalni karakter nanopraha i njegova poroznost dobijeni su primenom četvoroparametarskog modela, Bruggeman-ovog i generalisanog Bruggeman-ovog modela, na način opisan jednačinama (4.10), (4.15) i (4.16) u prethodnom poglavlju. Sa ove slike može se videti da smanjenje veličine kristalita, odnosno povećanje specifične površine S_{BET} , koje je po pravilu povezano sa povećanjem poroznosti TiO_2 nanopraha [176], dovodi do smanjenja intenziteta refleksivnosti u eksperimentalnim IC spektrima. Rezultati modela prikazani na istoj slici pokazuju istu tendenciju sa smanjenjem zapreminskog učešćа TiO_2 nanopraha (f_{TiO_2}), odnosno sa povećanjem prisustva vazduha, tj. makroskopske poroznosti.



Slika 4.9. Eksperimentalni spektri refleksije poroznih nanoprahova anatas TiO_2 zajedno sa rezultatima generalisane Bruggeman-ove FTES.



4.10. Eksperimentalni spektri refleksije poroznih nanoprahova anatas TiO_2 sa odgovarajućim spektrima dobijenim modelovanjem.

Na Slici 4.10. prikazani su precizniji rezultati generalisanog Bruggeman-ovog modela, sa oscilatorima koji odgovaraju pojedinačnim nanoprahovima, čiji parametri su prikazani u Tabeli 4.3 [174]. Ovi parametri dobijeni su numeričkim usaglašavanjem eksperimentalnih i teorijskih spektara refleksije. Kao što se može zapaziti iz Tabele 4.3, postoji mala varijacija u učestanostima i parametrima prigušenja za TO i LO modove različitih nanoprahova. U Tabeli 4.3. takođe su prikazane uporedne vrednosti TO/LO parametara oscilatora anatas modifikacije TiO_2 , koje su publikovali različiti autori: Gonzalez i saradnici [2, 7] daju iste podatke za monokristal i tanki film anatas TiO_2 dobijene na osnovu eksperimentalnih rezultata, dok Mikami i Nakamura [5] predstavljaju teorijske TO/LO učestanosti za monokristal. Visokofrekventne dielektrične konstante za paralelnu i normalnu polarizaciju preuzete su iz ref. [2] i date su u Tabeli 4.1. Može se videti da su parametri poroznih anatas TiO_2 nanoprahova, koji su dobijeni kao rezultat primene modela, slični do sada publikovanim eksperimentalnim i teorijskim parametrima za anatas TiO_2 monokristal: učestanosti imaju slične vrednosti, dok su parametri prigušenja u slučaju anatas TiO_2 nanoprahova veći kod većine

oscilatora. Ovakav rezultat se u principu i očekuje, budući da je prigušenje, po pravilu, veće kod nanomaterijala nego u odgovarajućim kristalnim uzorcima, zato što se nanomaterijali mogu tretirati kao delimično amorfizovani [160].

Kada je u pitanju zapreminska učešće anatas TiO_2 nanopraha, procenjeno je da parametar f_{TiO_2} varira od 0.66 (za uzorak TIS57) do 0.705 (za uzorak TIS12), što znači da se poroznost dobijena u postupku modelovanja refleksionih IC spektara smanjuje, polazeći od uzorka TIS57 ka TIS12, što je u skladu sa ponašanjem specifične površine i odgovarajuće dimenzije nanočestice, koji su za ove uzorke dobijeni BET merenjima [174]. Vrednosti faktora oblika L su slične za sve uzorke, oko 0.65 i ukazuju da je oblik pora u ovim nanoprahovima praktično isti, tj. blago izdužen.

Tabela 4.3. Parametri oscilatora korišćeni u proračunima dielektričnih funkcija i IC refleksivnosti uzoraka TIS57, TIS24 i TIS12 anatas TiO_2 nanoprahova [174] i eksperimentalni i teorijski parametri anatas TiO_2 monokristala, prema drugim autorima. Učestanosti i parametri prigušenja dati su u cm^{-1} .

Modovi	Eksperimentalni rezultati								Drugi autori	
	TIS57		TIS24		TIS12		Exp. [2, 7]		Teor. [5]	
	ω	γ	ω	γ	ω	γ	ω	γ	ω	
A_{2u}	TO	347	50	340	50	343	50	367	68	375.3
	LO	755	100	755	100	720	100	755	79	743.1
$E_u(1)$	TO	272	60	272	54	270	50	262	36	246.8
	LO	365	2.8	365	2	365	2	366	4.1	340.6
$E_u(2)$	TO	438	50	438	58	438	70	435	32	497.9
	LO	850	100	850	100	850	100	867	33	892.2

Parametri	TIS57	TIS24	TIS12
f_{TiO_2}	0.66	0.68	0.705
L	0.65	0.65	0.655

Osim glavnih svojstava IC refleksivnosti anatas TiO_2 nanopraha, u ovim spektrima javljaju se i dva dodatna slaba IC moda, na oko 150 i 640 cm^{-1} , koji se mogu registrovati u svim eksperimentalnim spektrima i na Slici 4.10. označeni su strelicama. Zato je bolje kvantitativno slaganje sa eksperimentalnim spektrom dobijeno uključivanjem dva dodatna oscilatora u obe polarizacije. Odgovarajuće TO/LO

učestanosti ovih modova su $150(165)\text{ cm}^{-1}$, odnosno $640(650)\text{ cm}^{-1}$, a odgovarajući faktori prigušenja prikazani su u Tabeli 4.4. Treba imati u vidu da ni kristalni anatas TiO_2 [5], a ni druge TiO_2 modifikacije (rutil [23, 24], brukit [4]), odnosno drugi titanijumovi oksidi (TiO , Ti_2O_3 , Ti_2O_5) i suboksidi, nemaju IC aktivne modove na ovim ili približnim učestanostima. Gonzalez sa saradnicima [2] registrovao je pojavu slabog moda na oko 640 cm^{-1} u anatas TiO_2 makroskopskom kristalu, mada u tom trenutku nepoznatog porekla. U slučaju ovih nanoprahova, poreklo novih modova može se pripisati posledicama deformacije kristalne rešetke anatas strukture, koja se javlja u nanokristalu [174].

Tabela 4.4. Parametri oscilatora za dodatne modove u IC spektru anatas TiO_2 nanoprahova (TIS57, TIS24, TIS12) [174]. Učestanosti i parametri prigušenja dati su u cm^{-1} .

Dodatni modovi	TIS57		TIS24		TIS12	
	ω	γ	ω	γ	ω	γ
TO	150	100	150	120	150	90
LO	165	105	165	165	165	98
TO	640	230	650	180	640	200
LO	650	250	640	220	645	230

Kako je već opisano u Poglavlju 1.1.1, anatas faza TiO_2 ima 6 Raman aktivnih ($A_{1g}+2B_{1g}+3E_g$) i 3 IC aktivna moda ($A_{2u}+2E_u$), gde Ramanov E_g mod potiče od oscilacija kiseoničnih atoma [5, 6]. Prepostavlja se da dodatne učestanosti u IC spektru, u skladu sa prirodom nanomaterijala, mogu poticati od modova zabranjenih selekcionim pravilima u IC spektru [24], budući da su učestanosti ovih oscilatora veoma slične najintenzivnijim E_g modovima u Ramanovom spektru anatas TiO_2 monokristala [6, 113], koji se nalaze na 144, odnosno 639 cm^{-1} . Naime, prisustvo male količine Ti^{3+} na pozicijama Ti^{4+} jona može da dovede do lokalnog poremećaja elektroneutralnosti i blage deformacije kristalne rešetke, te pojave inače simetrijski zabranjenih E_g modova u IC spektru. Stanja Ti^{3+} vode poreklo od pojave nestehiometrije, odnosno manjka kiseonika u anatas TiO_2 kristalnoj rešetki, kao i različitih stanja i defekata na površini nanomaterijala [177]. Poznato je da i anatas TiO_2 , uprkos svojoj visokoj energiji rešetke, oslobađa male količine kiseonika sa površine [120], što je praćeno pojavom žute boje uzorka [178]. Uzorci koji su opisani u ovom poglavlju, nakon presovanja

dobili su blago žutu boju, što potvrđuje da postoji izvesna količina Ti^{3+} stanja. U skladu sa ovim razmatranjima, može se zaključiti da bi prisustvo dodatnih modova u IC spektru anatas TiO_2 nanoprahova moglo da bude povezano sa prisustvom kiseoničnih vakancija na površini nanokristalita, a u skladu sa tim i prisustvom površinskih Ti^{3+} stanja u ovom materijalu. Treba imati u vidu da su Ti^{3+} stanja u TiO_2 aktivna u procesu fotokatalize (redukcije), te da povećanje fotokatalitičke aktivnosti TiO_2 i nastaje usled povećanja koncentracije Ti^{3+} jona, do kojeg dolazi usled valentne promene titanijumovog jona iz Ti^{4+} u Ti^{3+} [179].

4.5.2. Analiza IC spektra nestehiometrijskog anatas TiO_2 nanopraha

Proučavanje strukturalnih i električnih svojstava nanokristalnog anatas TiO_2 , posebno uticaja defekata na električnu provodnost, ima veliki značaj kod praktične primene [180]. Zbog prisustva vakancija donorskog tipa, TiO_2 se smatra širokozonskim poluprovodnikom *n*-tipa. Kao što je ranije rečeno, električna svojstva nanomaterijala se, usled dosta kompleksne strukture i velike površine materijala, znatno razlikuju od svojstava odgovarajućeg monokristala. Elektronska provodnost nanokristalnog anatas TiO_2 srazmerna je koncentraciji kiseoničnih vakancija, koje opet zavise od pritiska kiseonika u okolini [180]. Pojava slobodnih elektrona usled prisutstva defekata u kristalnoj rešetki, kao i sparivanje plazmona sa LO optičkim fononima, registrovana je ranije kod TiO_2 u rutilnoj fazi [166]. U ovom poglavlju biće prikazan uticaj nestehiometrije izazvane laserskim zračenjem u vakuumu na pojavu slobodnih nosilaca (elektrona) u anatas TiO_2 nanoprahu, registrovan merenjem IC refleksivnosti [181].

Ovde je analiziran uzorak TIS49, čiji su strukturalni parametri detaljno opisani u Poglavlju 1.1.3: srednja veličina nanokristalita $\langle d \rangle = 12.5$ nm, procenjena iz XRD merenja, što takođe odgovara i veličini dobijenoj iz BET merenja (14.5 nm, $S_{BET} = 109 \text{ m}^2/\text{g}$). SEM mikrograf nanopraha TIS49 pokazao je da su nanočestice uglavnom sfernog oblika, sa srednjim prečnikom od $\langle d \rangle = 35$ nm, što je, kao i u prethodnim slučajevima direktna posledica aglomeracije nanopraha [174, 181]. Braon boja uzorka nakon ozračivanja, kao i u prethodnom slučajevima [174], upućuje na povećanje nestehiometrije u uzorku, usled gubitka kiseonika sa površine usled izlaganja

vakuumu i laserskom ozračivanju [121, 182]. Uticaj ovih defekata u nestehiometrijskom TiO_2 obično se razmatra u vezi sa formiranjem jonskih defekata, kao što su titanijumske intersticije ili kiseonične vakancije, o čemu je više reči bilo u Poglavlju 1.1.2, posvećenom defektima kod anatas TiO_2 . Kao što je rečeno, titanijumske intersticije Ti_i , kao četvorostruki donori, verovatno su najodgovornije za sopstvenu provodnost n tipa zapaženu u anatas TiO_2 . Međutim, treba napomenuti da i kiseonične vakancije V_{O}^{2+} , kao dvostruki donori, mogu doprineti n provodnosti, tako što svaka vakancija dodaje dva elektrona u sistem. Pored toga, kiseonične vakancije proizvode lokalizovana stanja unutar energijskog procepa, o čemu je bilo dosta reči u Poglavlju 3.2 o fotoluminescentnim svojstvima nestehiometrijskih anatas TiO_2 nanoprahova.

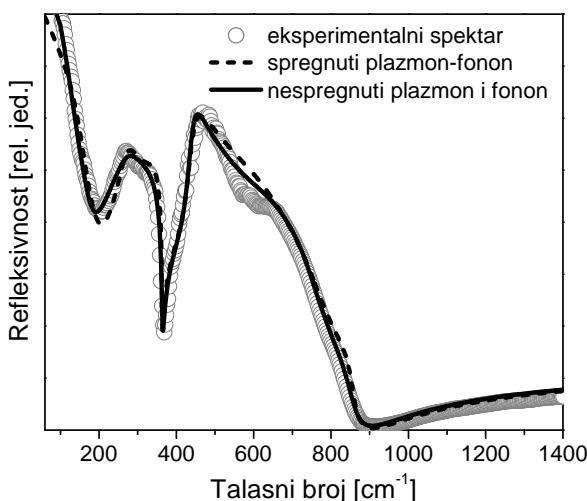
Eksperimentalni IC spektar snimljen nakon laserskog ozračivanja anatas TiO_2 nanopraha prikazan je na Slici 4.11. Pojava jakog plazmonskog moda ukazuje na prisustvo velikog broja slobodnih elektrona, koji su nastali usled prisustva nestehiometrijskih defekata. Ovaj mod je, koliko je do sada poznato iz literature, ovde prvi put registrovan u anatas fazi TiO_2 nanopraha [181].

Na sličan način kao u prethodnom poglavlju, u analizi IC spektra nestehiometrijskog anatas TiO_2 nanopraha, polazi se od dielektričnih funkcija, koje odgovaraju monokristalu anatas TiO_2 u paralelnoj i normalnoj polarizaciji. Međutim, zbog prisustva slobodnih elektrona, neophodno je u faktorizovani oblik dielektričnih funkcija u obe polarizacije uključiti i doprinos plazmonskog moda, što je moguće uraditi na dva načina. U jednom slučaju dielektrična funkcija je računata pomoću četvoroparametarskog modela (4.11), koji odgovara *sregnutim* LO-fonon-plazmon modovima. Sa druge strane, dielektrična funkcija je modelovana primenom faktorizovanog oblika sa Drude-ovim članom, koji odgovara nesregnutim LO-fonon i plazmon modovima i dat je jednačinom (4.12). Ovaj pristup podrazumeva nezavisan izbor parametara TO/LO fonona kristalne rešetke i parametara plazmona.

Polikristalni karakter nanopraha i njegova poroznost modelovani su primenom Bruggeman-ovih jednačina (4.15) i (4.16), na način koji je sproveden u prethodnom poglavlju, kod uzorka bez jasno izražene komponente slobodnih elektrona. Na Slici 4.11 modelovani su refleksioni spektri dobijeni na dva načina, sa i bez sparivanja fononskog i plazmonskog moda. Za generalisani Bruggeman-ov model (4.16) korišćeni su parametri porognog nanopraha: $f_{\text{TiO}_2} = 0.62$ i faktor oblika pora $L=0.65$ [181].

Učestanosti i faktori prigušenja koji odgovaraju spregnutim i nespregnutim TO i LO modovima upoređeni su u Tabeli 4.5, a viskofrekventne dielektrične konstante date su ranije u Tabeli 4.1.

Sparivanje se manifestuje značajnim pomerajem učestanosti između spregnutog i odgovarajućeg nespregnutog IC moda. Ovaj efekat je registrovan kod LO modova na višim učestanostima, oko 735 i 850 cm^{-1} , zbog čega se može zaključiti da je sparivanje plazmona sa ovim LO modovima mnogo jače nego sa drugim LO modom, koji se nalazi na 363 cm^{-1} . Istovremeno se može uočiti da su TO učestanosti veoma slične onim u spektrima anatas TiO_2 nanoprahova kod kojih nije registrovan uticaj plazme [174, 181].



Slika 4.11. Eksperimentalni IC spektar (kružići) anatas TiO_2 nanopraha (TIS49) i modelovani spektri dobijeni primenom generalisanog Bruggeman-ovog modela, sa nespregnutim (puna linija) i spregnutim (isprikidana linija) LO-fononskim i plazmonske modovima.

Pored glavnih svojstava, koja se javljaju u IC spektru anatas TiO_2 nanopraha, i u ovom uzorku, kao i u prethodnim (TIS57, TIS24, TIS12), javljaju se dodatni modovi na oko 150 i 640 cm^{-1} , za koje se smatra, kako je objašnjeno u prethodnom poglavljju, da potiču iz ramanskog spektra [174]. Parametri ovih modova prikazani su u Tabeli 4.6.

Analiza plazmonske doprinosa ovde je izvedena bez posebnog uvida u specifična svojstva nanopraha. Usled toga, provodnost, računata uobičajenom procedurom [183] iz parametara čistog plazmona daje mnogo veće vrednosti od onih koje se inače dobijaju Hall-ovim merenjima nanokristalnih anatas TiO_2 filmova [145, 179]. Moguće poboljšanje ovog modela u tom smislu bila bi primena generalizovanog

Drude-ovog modela, gde su parametri prigušenja frekventno zavisni [184]. Ovaj pristup bi bio zasnovan na prisustvu dva regiona u materijalu: uređene oblasti unutar kristalita i visokodeformisanih oblasti oko kristalita, koje obuhvataju granične i slobodne površine. Elektroni u ovim regionima imali bi različit odziv na primenjeno električno polje, i mogli bi biti posmatrani kao dve različite vrste nosilaca nanelektrisanja, sa različitim gustinama, efektivnim masama i vremenom relaksacije, imajući u vidu kompleksnu strukturu poroznih nanoprahova, sa velikom specifičnom površinom, što je predmet budućih analiza.

Tabela 4.5. TO i LO fononske učestanosti i faktori prigušenja anatas TiO₂ nanopraha (TIS49), dobijeni modelovanjem sa spregnutim i nespagnutim LO-fononskim i plazmonske modovima. Učestanosti i parametri prigušenja dati su u cm⁻¹.

		TIS49			
IC modovi		Spregnuti modovi		Nespregnuti modovi	
		ω	γ	ω	γ
A_{2u}	TO	347	72	349	70
	LO	735	120	620	90
$E_u(1)$	TO	269	55	265	50
	LO	363	2.4	351	2.2
$E_u(2)$	TO	438	35	438	28
	LO	850	30	740	20
Parametri plazme		Spregnuti plazmon		Nespregnuti plazmon	
ω_{pl} [cm ⁻¹]		190		480	
γ_{pl} [cm ⁻¹]		95		60	
γ_0 [cm ⁻¹]		70		40	

Tabela 4.6. Parametri oscilatora za dodatne modove u IC spektru anatas TiO₂ nanoprahova [181]. Učestanosti i parametri prigušenja dati su u cm⁻¹.

Dodatni modovi	Spregnuti modovi		Nespregnuti modovi	
	ω	γ	ω	γ
TO	150	100	150	100
LO	165	105	165	105
TO	630	200	635	100
LO	640	200	645	150

ZAKLJUČAK

U ovom radu izloženi su rezultati istraživanja strukturalnih i optičkih svojstava oksidnih nanoprahova primenom metoda ramanske, fotoluminescentne i infracrvene spektroskopije. Predloženi su fenomenološki modeli za analizu eksperimentalnih ramanskih i IC spektara, koji polaze od osnovnih svojstava odgovarajućih kristalnih materijala, a zatim uvode specifičnosti nanomaterijala, kako bi bliže odredili njihove karakteristike. U tom cilju razvijen je odgovarajući numerički postupak sa originalnim softverom. Modeli su najpre testirani u odnosu na eksperimentalne podatke o poznatim efektima u nanomaterijalima, a zatim su rezultati formiranih numeričkih modela upoređeni sa eksperimentalnim spektrima uzoraka anatas TiO_2 , čistog $\text{CeO}_{2-\delta}$ i dopiranih $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahova, proučavanih u ovom radu.

Teorijska osnova proučavanja nanokristalnih oksida i njihovih spektralnih karakteristika pomoću **ramanske spektroskopije** oslanja se, pre svega, na model fononskog ograničenja (MFO). MFO je korišćen za opisivanje pomeranja i asimetričnog širenja ramanskih modova usled ograničavanja optičkih fonona unutar nanokristalita malog prečnika. Njegova primena polazi od činjenice da se selekciona pravila održanja momenta fonona, koja inače važe u savršenom kristalu, ne primenjuju kod nanokristala, pa se fononska talasna funkcija u beskonačnom kristalu zamenjuje odgovarajućom funkcijom, koja opisuje fonon ograničen u maloj zapremini kristalita.

Pokazalo se da, zbog većeg broja parametara MFO, čija promena dovodi do sličnih rezultata modelovanja, treba uvek imati u vidu fizičke karakteristike nanomaterijala čiji se ramanski spektri proučavaju. Zbog toga je prikazana detaljna analiza uticaja pojedinih parametara MFO na položaj, širinu i oblik modelovanog

ramanskog spektra nanomaterijala. Razmatrani su uticaji jačine i dimenzije fononskog ograničenja, fononske disperzije i anizotropije Brillouin-ove zone (BZ), distribucije dimenzija nanočestica, usrednjjenog i nehomogenog naprezanja, odstupanja od stehiometrije i anharmonijskog efekta.

Kada je u pitanju jačina fononskog ograničenja (β), pokazalo se da njen smanjenje ima sličan efekat kao i smanjenje dimenzije ograničenja, te da se, pri modelovanju konkretnog nanomaterijala, mora poći od njegovih prostornih dimenzija, kojima je određena dimenzija fononskog ograničenja.

Uticaj fonona izvan centra BZ kod nanomaterijala uzima se u obzir preko disperzionih relacija duž glavnih pravaca visoke simetrije unutar BZ i pre svega se ogleda u smeru pomeranja učestanosti ramanskog moda. U slučaju pozitivnog nagiba disperzije krive, MFO predviđa pomeranje ramanskog moda ka višim učestanostima (tzv. plavi pomeraj), dok u slučaju negativnog nagiba disperzije predviđa pomeranje ka nižim učestanostima (crveni pomeraj), što je u skladu sa eksperimentalnim rezultatima kod različitih nanomaterijala. Pored nagiba disperzije funkcije, na veličinu pomeraja i asimetričnog širenja ramanskog moda značajno utiče izbor simetrijskih pravaca u BZ i odgovarajućih disperzionih funkcija. Kako veliki uticaj može da ima i oblik BZ, razmotrena je opravdanost najčešće korištene aproksimacije u MFO, gde se BZ posmatra kao sferna i izotropna. Pokazalo se da kod $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha (sa fluoritnom jediničnom čelijom) jedino primena MFO sa sfernom i neizotropnom BZ dobro modeluje eksperimentalne ramanske spektre. S druge strane, u slučaju anatas TiO_2 nanopraha (sa tetragonalnom jediničnom čelijom), primena MFO sa neizotropnom BZ ne unosi značajna poboljšanja u modelovanju ramanskih spektara, u poređenju sa rezultatima zasnovanim na modelu izotropne BZ.

Pokazano je da MFO dobro modeluje uticaj veličine nanočestice na položaj i oblik ramanskog moda, koji se manifestuje kroz pomeranje i asimetrično širenje moda sa smanjivanjem nanočestice. Pri tome je posebno analiziran uticaj oblika raspodele dimenzije nanočestice, kroz primenu simetrične i asimetrične Gauss-ove raspodele.

Kako kod nanomaterijala smanjenje dimenzija čestica dovodi do naprezanja i pratećih promena parametara rešetke, MFO je modifikovan kako bi obuhvatio i efekte usrednjjenog, odnosno nehomogenog naprezanja. Pokazalo se da usrednjeno naprezanje unosi dodatno pomeranje, ali ne i širenje modelovanog ramanskog moda. Nehomogeno

naprezanje, uvedeno sa neuniformnom distribucijom dimenzije nanočestice, pored izraženog pomeranja moda, unosi i dodatno asimetrično širenje modelovanog spektra.

Posebno je analizirana temperaturska zavisnost ramanskog spektra nanomaterijala, pri čemu je pokazano da dimenzija nanočestice bitno utiče na ponašanje ramanskih modova u zavisnosti od temperature. Kao što je očekivano, usled uticaja fononskog ograničenja kod nanokristala, osim pomeranja položaja moda, sa porastom temperature dolazi i do znatno većeg širenja ramanskog moda. Primenom MFO razdvojeni su doprinosi, koje pomeranju i širenju moda daju fononsko ograničenje i anharmonijski efekat i pokazano je da je asimetrija moda izraženija na nižim temperaturama, gde su doprinosi fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta međusobno uporedivi.

Uticaji dimenzije nanočestice, naprezanja, nestehiometrije i anharmonijskog efekta na ramanski E_g mod ($\sim 144 \text{ cm}^{-1}$) anatas TiO_2 nanoprahova analizirani su primenom MFO i njegova uspešnost u modelovanju navedenih efekata potvrđena je dobrom slaganjem modelovanih sa eksperimentalnim spektrima. Zaključeno je da:

(1) MFO sa asimetričnom Gauss-ovom distribucijom dimenzija nanočestica dobro opisuje uticaj smanjivanja nanočestice pomeranje i asimetrično širenje ramanskog E_g moda ka višim učestanostima;

(2) kod uzorka sa većim naprezanjem dolazi do većeg pomeranja i asimetričnog širenja ramanskog E_g moda ka višim učestanostima, što je u skladu sa rezultatima XRD merenja, koji su pokazali da sa smanjenjem dimenzije kristalita analiziranih anatas TiO_2 nanoprahova dolazi do kontrakcije jedinične celije.

(3) nestehiometrija izazvana laserskim ozračivanjem anatas TiO_2 nanopraha u vakuumu dovodi do snižavanja intenziteta ramanskog E_g moda, istovremeno sa pomeranjem i širenjem u odnosu na isti mod meren u vazduhu. Pri tome je pokazano da primena MFO omogućava razdvajanje uticaja nestehiometrije od ostalih faktora (veličine nanočestice, njene distribucije, naprezanja), što daje mogućnost da se na osnovu ramanskih spektara proceni nestehiometrija kod anatas TiO_2 nanoprahova i

(4) da su doprinosi fononskog ograničenja i anharmonijskog efekta na ramanski E_g mod kod anatas TiO_2 nanopraha uporedivi na niskim temperaturama, dok na višim temperaturama doprinos anharmonijskog efekta daleko prevazilazi doprinos fononskog ograničenja. Zbog toga zanemarivanje anharmonijskog uticaja na ramanski E_g mod kod

anatas TiO_2 nanopraha, čak i na sobnoj temperaturi, vodi ka velikom odstupanju rezultata MFO od eksperimentalnih. Pored toga, pokazalo se da, za razliku od anharmonijskog efekta u kristalnom anatas TiO_2 , gde je zavisnost pomeranja i širenja ramanskog E_g moda gotovo linearna i može biti modelovana samo trofononskim procesima, kod anatas TiO_2 nanoprahova moraju biti uzet u obzir i četvorofononski procesi.

Kod čistog $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanopraha nekoliko faktora, kao što su fononsko ograničenje, naprezanje, nehomogena distribucija čestice i defekti koji potiču od nestehiometrije, doprinose promenama položaja i širine ramanskog F_{2g} moda. Pokazalo se da MFO sa jakim fononskim ograničenjem i nehomogenim naprezanjem, povezanim sa distribucijom dimenzija nanočestica, veoma dobro objašnjava veliko pomeranje ($\sim 457 \text{ cm}^{-1}$) i asimetrično širenje ovog ramanskog moda ka nižim učestanostima u odnosu na polikristal.

Dobro slaganje eksperimentalnog i modelovanog ramanskog F_{2g} moda kod dopiranih $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ ($x=0.10-0.25$) dobijeno je primenom opisanog MFO, s tim što je uzeto u obzir i pomeranje ovog moda u odnosu na čist nanokristalni $\text{CeO}_{2-\delta}$ ka višim, odnosno nižim učestanostima, u skladu sa veličinom jonskog radijusa dopanta Y, odnosno Nd.

Osim toga, pokazalo se da se u ramanskim spektrima ovih nanoprahova javljaju dva nova ramanska moda:

(1) mod u čistom $\text{CeO}_{2-\delta}$ i dopiranim $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahovima na oko 600 cm^{-1} , pripisan ramanskom rasejanju drugog reda, koji se može povezati sa prisustvom sopstvenih kiseoničnih vakancija usled nestehiometrije;

(2) dodatni mod u spektrima obe serije dopiranih uzoraka $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$, čiji intenzitet raste sa porastom koncentracije dopanata. Položaj ovog moda u Y-dopiranim uzorcima kreće se od 550 do 556 cm^{-1} sa porastom koncentracije Y. Kod uzorka dopiranih Nd, sa porastom koncentracije dopanta njegov položaj se pomera na suprotnu stranu, tj. od 545 ka 540 cm^{-1} . Njegovo poreklo pripisano je prisustvu dodatnih O^{2-} vakancija, koje nastaju usled supstitucije Ce^{4+} jona $\text{Y}(\text{Nd})^{3+}$ jonima. Položaj ovog moda zavisi od lokalnog atomskog okruženja vakancije u kristalnoj rešetki.

Ovi rezultati potvrđuju sposobnost ramanske spektroskopije da uspešno identificuje i razlikuje lokalno okruženje kiseoničnih vakancija u fluoritnoj strukturi.

Naime, u uzorcima dopiranim Y defekti obuhvataju O²⁻ vakanciju i dva katjona u najbližem susedstvu, dok se kod Nd dopiranih uzoraka defekti mogu razložiti na one sa O²⁻ vakancijama i bez njih.

Procesi, koji u anatas TiO₂ nanoprahovima pobuđenim vidljivom svetlošću energije manje od širine energijskog procepa, dovode do pojave **fotolumescencije** u vidljivom delu spektra, pripisani su mehanizmima radijativne rekombinacije posredstvom kiseoničnih vakancija, površinskih stanja i samozarobljenih ekscitona (SZE), koji dolaze do izražaja u zavisnosti od uslova pobude i karakteristika samog nanopraha. Ovi mehanizmi su detaljno analizirani i predložen je model koji razdvaja njihove uticaje u FL spektrima.

Takođe je razmotren uticaj energije i snage pobude, kao i nestehiometrije i temperature na položaj i intenzitet FL spektara dva anatas TiO₂ nanopraha sa različitim dimenzijama nanočestice i naprezanjem. Ustanovljeno je da je kod krupnijeg nanopraha sa manjim naprezanjem dominantan uticaj FL moda, koji potiče od radijativne rekombinacije preko površinskih stanja, dok je kod sitnjeg nanopraha sa većim naprezanjem dominantan uticaj rekombinacije preko samozarobljenih ekscitona. Zapaženo je da dominacija FL moda koji potiče od SZE, dovodi do izraženijeg pomeranja luminescencije prema nižim energijama sa snižavanjem temperature, u odnosu na pomeranje FL spektara u kojima dominira rekombinacija posredstvom površinskih stanja. Pored toga, pokazano je da lasersko ozračivanje uzorka sa krupnjim nanočesticama u vakuumu dovodi do povećanja nestehiometrije, praćene pojačanjem intenziteta FL modova i pomeranjem FL spektara ka nižim energijama, usled povećanog uticaja FL modova koji potiču od kiseoničnih vakancija i površinskih stanja. Promene zapažene u ovom uzorku su reverzibilne, što znači da ozračivanjem u vazduhu FL spektri gube intenzitet i pomeraju se ka većim energijama, poprimajući oblik i intenzitet spektra pre tretiranja u vakuumu. Za razliku od ovih, strukturne promene nastale u uzorku sa sitnjim nanočesticama su ireverzibilne.

Ovi rezultati potvrđuju opravdanost uvođenja modela, koji omogućava razdvajanje učešća pojedinih FL mehanizama kod anatas TiO₂ nanoprahova. Njegova primena daje mogućnost prepoznavanja dominantnih defekata u pojedinim nanoprahovima na osnovu njihovih FL spektara. Prikazana luminescentna svojstva

anatas TiO_2 nanoprahova pobuđenih vidljivom svetlošću upućuju na mogućnost njihove primene u fotokatalizi, optičkim prevlakama i fotoelektrohemiskoj konverziji vidljive svetlosti.

Modelovanje **IC spektara** nanoprahova primenom generalisane Bruggeman-ove fenomenološke teorije efektivne sredine (FTES), polazi od spektra odgovarajućeg monokristalnog materijala, uzima u obzir polikristalni karakter nanopraha i uključuje poroznost nanopraha kao parametar. Poređenjem modelovanih sa eksperimentalnim IC spektrima refleksije anatas TiO_2 nanoprahova, dobijene su vrednosti učestanost i prigušenja TO i LO modova. Dobijeni rezultati pokazuju relativno malo odstupanje učestanosti TO i LO modova oscilatora u nanoprahovima u odnosu na odgovarajuće vrednosti u kristalnom anatas TiO_2 . Pri tome su vrednosti prigušenja modova po pravilu znatno veće u nanoprahovima nego u kristalu, što se moglo očekivati.

Osim pomenutih IC aktivnih modova, karakterističnih za kristalni anatas TiO_2 , u IC spektrima nanoprahova registrovani su i dodatni modovi malog intenziteta na oko 150, odnosno 640 cm^{-1} , što odgovara učestanostima inače zabranjenih ramanskih E_g modova u anatas TiO_2 . Njihova pojava u IC spektru može biti povezana sa prisustvom male količine Ti^{3+} jona na pozicijama Ti^{4+} jona, usled nedostatka kiseonika, kao i različitih stanja i defekata na površini nanočestica. Pojava Ti^{3+} stanja, karakteristična za široku klasu titanata, dovodi do lokalnog poremećaja elektroneutralnosti i blage deformacije kristalne rešetke, usled koje može doći do aktiviranja modova zabranjenih u IC spektru.

Primenom predloženog modela, procenjeno je zapreminska učešće vazduha u nanoprahu, koje se može povezati sa poroznošću praha, a dobijene vrednosti su u skladu sa eksperimentalno određenom specifičnom površinom nanopraha dobijenom iz BET merenja. Takođe je zapaženo da smanjenje veličine kristalita, praćeno povećanjem poroznosti TiO_2 nanopraha, dovodi do smanjenja intenziteta refleksivnosti u eksperimentalnim IC spektrima.

U IC spektrima nestehiometrijskog anatas TiO_2 nanopraha registrovana je pojava jakog plazmonskog moda, koji ukazuje na prisustvo velikog broja slobodnih elektrona, usled povećane koncentracije nestehiometrijskih defekata (titanijumskih intersticija i kiseoničnih vakancija), koji igraju ulogu donora. Za analizu IC spektara

ovog nanopraha takođe je primjenjen model generalisane Bruggeman-ove FTES, s tim što je uključen doprinos plazmonskog moda. Poređenjem rezultata koji odgovaraju spregnutim, odnosno nespregnutim (Drude-ov model) LO-fonon-plazmon modovima, uočeno je da je sparivanje plazmona sa LO modovima izraženije na višim učestanostima.

Treba istaći da su u ovom radu posebno analizirani uticaji uslova merenja na oksidne nanoprahove. Naime, iako se spektroskopske metode ubrajaju u nedestruktivne, kod oksidnih nanoprahova često se javljaju problemi povezani sa pojmom gubitka kiseonika usled izlaganja vakuumu i pojačanim lokalnim zagrevanjem usled laserskog ozračivanja, koje, zbog promjenjenih termalnih karakteristika, posebno dolazi do izražaja u nanomaterijalima.

Originalni rezultati numeričkih modela i eksperimentalnih metoda, prikazani u ovom radu, kao i njihova velika međusobna saglasnost, predstavljaju značajan korak u proučavanju optičkih svojstava oksidnih nanoprahova primenom spektroskopskih metoda. Prikazani eksperimentalni spektri, kao i njihova sistematska interpretacija, pokazali su da ramanska, FL i IC spektroskopija predstavljaju moćne metode za karakterizaciju oksidnih nanoprahova. Primenom ramanske spectroskopije dobijene su informacije o srednjoj dimenziji i distribuciji dimenzija nanočestica, efektima naprezanja, stehiometriji uzorka, strukturnim defektima i anharmonijskim efektima u anatas TiO_2 i čistim i dopiranim $\text{CeO}_{2-\delta}$ nanoprahovima. FL spektroskopija omogućila je uvid u elektronsku strukturu, nestehiometriju, prisustvo defekata i efekte površinskih stanja u anatas TiO_2 nanoprahovima. Primenom IC spektroskopije procenjeni su veličina i oblik nanočestica, poroznost nanopraha i oblik pora, kao i prisustvo nestehiometrijskih defekata i slobodnih nosilaca u anatas TiO_2 nanoprahovima.

Dobijene informacije o strukturnim i elektronskim svojstvima konkretnih oksidnih nanoprahova daju značajan doprinos razumevanju uticaja uslova sinteze na njihove željene karakteristike i potencijalnu primenu. Pored ovog tehnološkog cilja, primena optičke spektroskopije, sistematizacija i teorijska analiza dobijenih rezultata doprinose formiranju potpunije slike, kako oksidnih nanoprahova, tako i nanostrukturnih materijala uopšte.

LITERATURA

- [1] M. Fernandez-Garcia, A. Martinez-Arias, J. C. Hanson, and J. A. Rodriguez (2004): Nanostructured Oxides in Chemistry: Characterization and Properties, *Chem. Rev.* 104, 4063-4104.
- [2] R. J. Gonzalez, R. Zallen and H. Berger (1997): Infrared reflectivity and lattice fundamentals in anatase TiO₂, *Phys. Rev. B* 55, 7014-7017.
- [3] X. Bokhimi, A. Morales, M. Aguilar, J.A. Toledo-Antonio, F. Pedraz (2001): Local order in titania polymorphs, *International Journal of Hydrogen Energy* 26, 1279–1287.
- [4] Th. Posch, F. Kerschbaum, D. Fabian , H. Mutschke, J. Dorschner, A. Tamanai, and Th. Henning (2003): Infrared Properties of Solid Titanium Oxides: Exploring Potential Primary Dust Condensates, *The Astrophysical Journal Supplement Series* 149, 437-445.
- [5] M. Mikami, S. Nakamura, O. Kitao, H. Arakawa (2002): Lattice dynamics and dielectric properties of TiO₂ anatase: A first-principles study, *Phys. Rev. B* 66, 155213(1-6).
- [6] T. Ohsaka, F. Izumi, Y. Fujiki (1978): Raman spectrum of anatas, TiO₂, *J. Raman Spec.* 7, 321-324.
- [7] R. J. Gonzalez (1996): Raman, Infrared, X-ray, and EELS Studies of Nanophase Titania, PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute.
- [8] Y.-H. Zhang, C K. Chan, J. F. Porter, and W. Guo (1998): Micro-Raman spectroscopic characterization of nanosized TiO₂ powders prepared by vapor hydrolysis, *J. Mat. Res.* 13(9), 2602-2609.
- [9] A. Fahmi and C. Minot (1993): Theoretical analysis of the structures of titanium dioxide crystals, *Phys. Rev. B* 47(18), 11717-11724.
- [10] H. Gleiter, J. Weissmuller, O. Wollersheim and R. Wurschum (2001): Nanocrystalline materials: a way to solids with tunable electronic structures and properties?, *Acta Matter.* 49, 737-745.
- [11] A. A. Gribb, and J. F. Banfield (1997): Particle size effects on transformation kinetics and phase stability in nanocrystalline TiO₂, *American Mineralogist* 82, 717-728.
- [12] M. Andersson, L. Osterlund, S. Ljungstrom, and A. Palmqvist (2002): Preparation of Nanosize Anatase and Rutile TiO₂ by Hydrothermal Treatment of Microemulsions and Their Activity for Photocatalytic Wet Oxidation of Phenol, *J. Phys. Chem. B* 106, 10674-10679.
- [13] B. Guo, Z. Liu, L. Hong, H. Jiang (2005): Sol gel derived photocatalytic porous TiO₂ thin films, *Surface & Coatings Technology* 198, 24– 29.
- [14] K. Kalyanasundaram and M. Gratzel (1999) in Eds. D. M. Roundhill and J. P. Fackler *Optoelectronics Properties of Inorganic Compounds*, pp. 169-194, Plenum, New York.
- [15] R. Asahi and Y. Taga, W. Mannstadt, A. J. Freeman (2000): Electronic and optical properties of anatase TiO₂, *Phys. Rev. B* 61(11), 7459-7465.

- [16] Z. Wang, S. K. Saxena (2001): Raman spectroscopic study on pressure-induced amorphization in nanocrystalline anatase (TiO_2), Solid State Communications 118, 75-78.
- [17] S. D. Mo and W. Y. Ching (1995) Electronic and optical properties of three phases of titanium dioxide: Rutile, anatase, and brookite, Phys. Rev. B 51(19) 13023-13032.
- [18] M. Catalayud, P. Mori-Sanchez, A. Beltran, A. M. Pendas, E. Francisco, J. Andres and J M Recio (2001): Quantum-mechanical analysis of the equation of state of anatase TiO_2 , Phys. Rev. B 64 184113(1-6).
- [19] V. H. Baur (1961): Atomabstände und Bindungswinkel im Brookit, TiO_2 , Acta Crystallographica 14, 214-216.
- [20] J. Pascual, J. Camassel, and H. Mathieu (1978): Fine structure in the intrinsic absorption edge of TiO_2 , Phys. Rev. B 18, 5606-5614.
- [21] G. Cangiani (2003): Ab-initio study of the properties of TiO_2 rutile and anatase polytypes, PhD Thesis, 'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.
- [22] H. Tang, H. Berger, P. E. Schmid, F. Levy, Photoluminescence in TiO_2 anatase single crystals, Solid State Commun. (1993) 87(9), 847-850.
- [23] S. P. S. Porto, P. A. Fleury, and T. C. Damen (1967): Raman Spectra of TiO_2 , MgF_2 , ZnF_2 , FeF_2 , and MnF_2 , Physical Review 154(2), 522-526.
- [24] F. Gervais, B. Piriou (1974): Temperature dependence of transverse- and longitudinal optic modes in TiO_2 (rutile), Phys. Rev. B 10(4), 1642-1654.
- [25] G. A. Tompsett, G. A. Bowmaker, R. P. Cooney, J. B. Metson, K. A. Rodgers, J. M. Seakins (1995): The Raman spectrum of brookite, TiO_2 , Journal of Raman Spectroscopy 26(1), 57 - 62.
- [26] C. J. Bradley and A. P. Cracknell (1972): The mathematical theory of symmetry in solids: Representation theory for point groups and space groups, Clarendon Press, Oxford, UK.
- [27] S. Na-Phattalung, M. F. Smith, K. Kim, M.-H. Du, S.-H. Wei, S. B. Zhang, and S. Limpijumnong (2006): First-principles study of native defects in anatase TiO_2 , Phys. Rev. B 73, 125205(1-6).
- [28] V. I. Anisimov, M.A. Korotin, I. A. Nekrasov, A. S. Mylnikova, A. V. Lukoyanov, J. L. Wang and Z. Zeng (2006): The role of transition metal impurities and oxygen vacancies in the formation of ferromagnetism in Co-doped TiO_2 , J. Phys.: Condens. Matter 18, 1695–1704.
- [29] N. Yu and J. Woods Halley (1995): Electronic structure of point defects in rutile TiO_2 , Phys. Rev. B 51(8), 4768-4776.
- [30] D. C. Cronemeyer (1959): Infrared Absorption of Reduced Rutile TiO_2 Single Crystals, Phys. Rev. B 113(5), 1222-1226.
- [31] H. N. Ghosh, S. Adhikari, Trap state emission from TiO_2 nanoparticles in microemulsion solutions, Langmuir (2001) 17, 4129-4130.
- [32] N. Serpone, D. Lawless and R. Khairutdinov (1995): Size Effects on the Photophysical Properties of Colloidal Anatase TiO_2 Particles: Size Quantization or Direct Transitions in This Indirect Semiconductor?, J. Phys. Chem. 99, 16646-16654.
- [33] M. Goto, N. Harada, K. Iijima, H. Kunugita, K. Ema, M. Tsukamoto, N. Ichikawa, and H. Sakama (2007): Influence of oxygen vacancies on time-resolved photo-luminescence in photocatalytic anatase TiO_2 film, AIP Conference Proceedings 893, 161-162.

- [34] P. M. Kumar, S. Badrinarayanan, M. Sastry (2000): Nanocrystalline TiO₂ studied by optical, FTIR and X-ray photoelectron spectroscopy: correlation to presence of surface states, *Thin Solid Films* 358, 122-130.
- [35] L. Forss, M. Schubnell, Temperature dependence of the luminescence of TiO₂ powder, *Appl. Phys. B* (1993) 56, 363-366.
- [36] F. M. Hossain, G. E. Murch, L. Sheppard, J. Nowotny (2007): Ab initio electronic structure calculation of oxygen vacancies in rutile titanium dioxide, *Solid State Ionics* 178, 319–325.
- [37] Z. D. Dohčević-Mitrović, M. J. Šćepanović, I. I. Hinić, and G. M. Stanišić (2004): Laser induced synthesis of ultrafine anatase TiO₂ powders, *Materials Science Forum* 453-454, 237-242.
- [38] T. Arlt, M. Bermejo, M. A. Blanco, L. Gerward, J. Z. Jiang, J. Staun Olsen, and J. M. Recio (2000): High-pressure polymorphs of anatase TiO₂, *Phys. Rev. B* 61(21), 14414-14419.
- [39] A. Turković, A. Tonejc, S. Popović, P. Dubček, M. Ivanda, S. Musić, and M. Gotić (1997): Transmission electron microscopy, X-ray diffraction and Raman scattering studies of nanophasic TiO₂, *Fizika A* 6, 77-78.
- [40] R. J. Nemanich, C. C. Tsai, G. A. N. Connell (1980): Interference Enhanced Raman Scattering of Very Thin Titanium and Titanium Oxide Films, *Phys. Rev. Lett.* 44(4), 273-276.
- [41] Lj. Karanović (1996): *Primenjena kristalografska metoda za određivanje raspodele pora i čestica po veličinama u nanodimenzionim materijalima*, Zbornik radova sa naučnog skupa Fizika i tehnologija materijala – FITEM'04, 12-15 oktobar 2004, Čačak.
- [42] X.-D. Zhou and W. Huebner (2001): Size-induced lattice relaxation in CeO₂ nanoparticles, *Appl. Phys. Lett.* 79(21), 3512-3514.
- [43] I. Hinić, M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. Dohčević-Mitrović, G. M. Stanišić, Z. V. Popović (2005) Prikaz metode za određivanje raspodele pora i čestica po veličinama u nanodimenzionim materijalima, Zbornik radova sa naučnog skupa Fizika i tehnologija materijala – FITEM'04, 12-15 oktobar 2004, Čačak.
- [44] S. Bošković, D. Djurović, Z. Dohčević-Mitrović, Z. Popović, M. Zinkevich and F. Aldinger (2005): Self-propagating room temperature synthesis of nanopowders for solid oxide fuel cells (SOFC), *J. Power Sources* 145, 237-242.
- [45] Z. Crnjak Orel (1999): Characterization of cerium dioxide dip-coated films by spectroscopic technique, *Internet J. Vib. Spec.* [www.ijvs.com] 3(4), 6.
- [46] D. A. Andersson, S. I. Simak, B. Johansson, I. A. Abrikosov, and N. V. Skorodumova (2007): Modeling of CeO₂, Ce₂O₃, and CeO_{2-x} in the LDA+U formalism, *Phys. Rev. B* 75, 035109(1-6).
- [47] N.V. Skorodumova, S. I. Simak, B. I. Lundqvist, I. A. Abrikosov, and B. Johansson (2002): Quantum Origin of the Oxygen Storage Capability of Ceria, *Phys. Rev. B* 89(16), 166601(1-4).
- [48] A.K. Bhattacharya, A. Hartridge, K.K. Mallick, and J.L. Woodhead (1996): Low-temperature synthesis and characterization of ceria-based oxide ion conductors *J. Mater. Sci.* 31(19), 5005-5007.
- [49] T. Gürel and R. Eryiğit (2006): Ab initio pressure-dependent vibrational and dielectric properties of CeO₂, *Phys. Rev. B* 74, 014302(1-5).
- [50] J. E. Spaneir, R. D. Robinson, F. Zhang, S. Chen and I. P. Herman (2001): Size-dependent properties of CeO_{2-y} nanoparticles as studied by Raman scattering, *Phys. Rev. B* 64, 245407(1-8).

- [51] A. Atkinson (1997): Chemically-induced stresses in gadolinium-doped ceria solid oxide fuel cell electrolytes, Solid State Ionics 95, 249-258.
- [52] A. Trovarelli (1996): Catalytic Properties of Ceria and CeO₂-Containing Materials, Catal. Rev. Sci. Eng 38(4), 439-520.
- [53] S. Wang, W. Wang, J. Zuo, and Y. Qian (2001): Study of the Raman spectrum of CeO₂ nanometer thin films, Mater. Chem. Phys. 68, 246-248.
- [54] P. Jasinski, T. Suzuki and H. U. Anderson (2003): Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor, Sensors and actuators B 95, 73-77.
- [55] A. Nakajima, A. Yoshihara and M. Ishigame (1994): Defect-induced Raman spectra in doped CeO₂, Phys. Rev. B 50(18), 13297-13307.
- [56] J. R. McBride, K. C. Hass, B. D. Poindexter, and W. H. Weber (1994): Raman and x-ray studies of Ce_{1-x}RE_xO_{2-y} where RE=La, Pr, Nci, Eu, Gd, and Tb, J. Appl. Phys. 76(4), 2435-2441.
- [57] I. Kosacki, T. Suzuki, H. U. Anderson and P. Colombari (2002): Raman scattering and lattice defects in nanocrystalline CeO₂ thin films, Solid State Ionics 149, 99– 105.
- [58] David A. Andersson, Sergei I. Simak, Natalia V. Skorodumova, Igor A. Abrikosov, and Borje Johansson (2006): Optimization of ionic conductivity in doped ceria, PNAS 103(10), 3518–3521.
- [59] M. Radović, Z. Dohčević-Mitrović, M. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, B. Matović, S. Bošković, and Z. V. Popović, (2007): Raman study of Ba-doped ceria nanopowders, Science of Sintering (u štampi).
- [60] D. Barreca, A. Gasparotto, C. Maccato, C. Maragno, E. Tondello, E. Comini and G. Sberveglieri (2007): Columnar CeO₂ nanostructures for sensor Application, Nanotechnology 18, 125502-125507.
- [61] S.C. Singhal (2000): Advances in solid oxide fuel cell technology, Solid State Ionics 135, 305–313.
- [62] S. P. S. Badwal and K. Fogler (1996): Solid Oxide Electrolite Fuel Cell Review, Ceramics International 22, 257-265.
- [63] S. M. Haile (2003): Fuel cell materials and components, Acta Materialia 51, 5981–6000.
- [64] S. J. Skinner and J. A. Kilner (2006): Oxygen ion conductors, Materials Today, March, 30-37.
- [65] S. Tsunekawa, K. Ishikawa, Z.-Q. Li, Y. Kawazoe, and A. Kasuya (2000): Origin of Anomalous Lattice Expansion in Oxide Nanoparticles, Phys. Rev. Lett. 85, 3440-3443.
- [66] G. A. Kourouklis, A. Jayaraman and G. P. Espinosa (1988): High-pressure Raman study of CeO₂ to 35 Gpa and pressure-induced phase transformation from the fluorite structure, Phys. Rev. B 37(8), 4250-4253.
- [67] W. H. Weber, K. C. Hass, and J. R. McBride (1993): Raman Study of CeO₂: Second-order scattering, lattice dynamics, and particle-size effects, Phys. Rev. B 48(1), 178-185.
- [68] K. Clausen, W. Hayes, J. E. Macdonald, R. Osborn, P. G. Schnabel, M. T. Hutchings and A. Magerl (1987): Inelastic neutron scattering investigation of the lattice dynamics of ThO₂ and CeO₂, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2(83), 1109 - 1112.
- [69] M. P. Anderson, D. E. Cox, K. Halperin and A. S. Nowick (1983): Neutron diffuse scattering in Y₂O₃- and Sc₂O₃-doped CeO₂, Solid State Ionics 9-10, 953-959.
- [70] Z. D. Dohčević-Mitrović, M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. V. Popović, S. Bošković, B. Matović, M. Zinkevich and F. Aldinger (2006): Ce_{1-x}Y(Nd)_xO_{2-δ}

- nanopowders: potential materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells, *J. Phys.: Condens. Matter* 18, S2061–S2068.
- [71] M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, M. Šćepanović, Z. V. Popović, S. Bošković, M. Zinkevich, F. Aldinger, B. Matović (2006): Ramanovo rasejanje na $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanoprahovima, *Metalurgija* 12(1), 61-67.
- [72] R. D. Shannon (1976): Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides, *Acta Crystallogr. Sect. A* 32, 751-767.
- [73] A. Singha, P. Dhar, A. Roy, A non-destructive analytic tool for nanostructured materials: Raman and photoluminescence spectroscopy, *American Journal of Physics* (2005) 73(3), 224(1-32).
- [74] G. Herzberg (1945): *Molecular Spectra and Molecular Structure, II. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecule*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- [75] Q. Williams (1995): *Infrared, Raman and Optical Spectroscopy of Earth Materials, Mineral Physics and Crystallography, A Handbook og Physical Constants*, p. 291-302, American Geophysical Union.
- [76] N.W. Ashcroft, N.D. Mermin (1976): *Solid State Physics*, Saunders College, Philadelphia.
- [77] D. J. Gardiner, P. R. Graves (Editors) (1989): *Practical Raman Spectroscopy*, Springer-Verlag, Berlin.
- [78] P. Brüesch (1986): *Phonons: Theory and Experiments II*, Springer-Verlag, Berlin.
- [79] R. Loudon (2001): The Raman effect in crystals, *Advances in Physics* 50(7), 813-864 (original (1964): *Advances in Physics* 13).
- [80] T.R. Hart, R.L. Agrawal, and B. Lax (1970): Temperature Dependence of Raman Scattering in Silicon, *Phys. Rev. B* 1(2), 638-642.
- [81] P. Brüesch (1982): *Phonons: Theory and Experiments I*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- [82] M. Balkanski, R.F. Wallis, E. Haro (1983): Anharmonic effects in light scattering due to optical phonons in silicon, *Phys. Rev. B* 28, 1928-1934.
- [83] M. J. Konstantinović, S. Bersier, X. Wang, M. Hayne. P. Lievens, R. E. Silverans, V. V. Moshchalkov (2002): Raman scattering in cluster-deposited nanogranular silicon films, *Phys. Rev. B* 66, 161311(1-4).
- [84] I. Hinić (1999): Vibraciona spektroskopija aerogelnih oblika SiO_2 , Doktorska disertacija, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
- [85] A. K. Arora, M. Rajalakshmi, T. R. Ravindran and V. Sivasubramanian (2007): Raman spectroscopy of optical phonon confinement in nanostructured materials, *J. Raman Spectrosc.* 38, 604–617.
- [86] D. Nesheva (2005): Raman scattering from semiconductor nanoparticles and superlattices, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 7(1), 185 - 192.
- [87] H. Richter, Z.P. Wang, and L. Ley (1981): The one phonon Raman spectrum in microcrystalline silicon, *Solid State Commun.* 39, 625-629.
- [88] I. I. Campbell and P. M. Fauchet (1986): The effects of microcrystal size and shape on the one phonon Raman spectra of crystalline semiconductors, *Solid State Communication* 58(10), 739-741.
- [89] M. Ivanda, S. Musić, M. Gotić, A. Turković, A. M. Tonejc and O. Gamulin (1999): The effects of crystal size on the Raman spectra of nanophase TiO_2 , *J. Mol. Struc.* 480-481, 641-644.

- [90] A. Li Bassi, D. Cattaneo, V. Russo, C. E. Bottani, E. Barborini, T. Mazza, P. Piseri, P. Milani, F. O. Emst, K. Wegner, and S. E. Pratsinis (2005): Raman spectroscopy characterization of titania nanoparticles produced by flame pyrolysis: The influence of size and stoichiometry, *J. Appl. Phys.* 98, 074305(1-9).
- [91] D. Bersani, P. P. Lottici and X.-Z. Ding (1998): Phonon confinement effects in the Raman scattering by TiO_2 nanocrystals, *Appl. Phys. Lett.* 72(1), 73-75.
- [92] K. R. Zhu, M. S. Zhang, Q. Chen and Z. Zin (2005): Size and phonon-confinement effects on low-frequency Raman mode of anatase TiO_2 nanocrystal, *Phys. Lett. A* 340, 220-227.
- [93] Z. D. Dohčević-Mitrović, M. J. Šćepanović, M. U. Grujić-Brojčin, Z. V. Popović, S. B. Bošković, B. M. Matović, M. V. Zinkevich, and F. Aldinger (2006): The size and strain effects on the Raman spectra of $\text{Ce}_{1-x}\text{Nd}_x\text{O}_{2-\delta}$ ($0 \leq x \leq 0.25$) nanopowders, *Solid State Communications* 137, 387–390.
- [94] Z. D. Dohčević-Mitrović, M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. V. Popović, S. Bošković, B. Matović, M. Zinkevich and F. Aldinger (2006): $\text{Ce}_{1-x}\text{Y}(\text{Nd})_x\text{O}_{2-\delta}$ nanopowders: potential materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells, *J. Phys.: Condens. Matter* 18, S2061–S2068.
- [95] J. Traylor, H. G. Smith, R. M. Nicklow and M. K. Wilkinson (1971): Lattice dynamics of rutile, *Phys. Rev. B* 3(10) 3457-3472.
- [96] D. R. Santos and I. L. Torriani (1993): Crystalite size determination in μc -Ge films by X-ray diffraction and Raman line profile analysis, *Solid State Commun.* 85, 307-310.
- [97] S. Kelly, F. H. Pollak, and M. Tomkiewicz (1997): Raman Spectroscopy as a Morphological Probe for TiO_2 Aerogels, *J. Phys. Chem. B* 101, 2730-2734.
- [98] S. Vukadinović (1978): Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike (Privredni pregled, Beograd).
- [99] Md. N. Islam and Satyendra Kumar (2001): Influence of crystallite size distribution on the micro-Raman analysis of porous Si, *Appl. Phys. Lett.* 78(6), 715-717.
- [100] G. Lucazeau (2003): Effect of pressure and temperature on Raman spectra of solids: anharmonicity, *J. Raman Spec.* 34(7-8), 478 - 496.
- [101] G. R. Hearne, J. Zhao, A. M. Dawe, V. Pischedda, M. Maaza, M. K. Nieuwoudt, P. Kibasomba, O. Nemraoui, D. Comins, and M. J. Witcomb (2004): Effect of grain size on structural transitions in anatase TiO_2 : A Raman spectroscopy study at high pressure, *Phys. Rev. B* 70, 134102(1-10).
- [102] J. W. Shaner (1973): Gruneisen γ of Rutile (TiO_2), *Phys. Rev. B* 7(11), 5008-5010.
- [103] J. Fabian and P. B. Allen (1997): Thermal Expansion and Grüneisen Parameters of Amorphous Silicon: A Realistic Model Calculation, *Phys. Rev. B* 79(10), 1885-1888.
- [104] V. Swamy, D. Menzies, B. C. Muddle, A. Kuznetsov, L. S. Dubrovinsky, Q. Dai, and V. Dmitriev (2006): Nonlinear size dependence of anatase TiO_2 lattice parameters, *Appl. Phys. Lett.* 88, 243103-1(3).
- [105] F. Zhang, S. W. Chan, J. E. Spanier, E. Apak, Q. Jin (2002): Cerium oxide nanoparticles: Size-selective formation and structure analysis, *Appl Phys. Lett.* 80(1), 127-129.
- [106] S. Deshpande, S. Patil, S. VNT Kuchibhatla, and S. Seal (2005): Size dependency variation in lattice parameter and valency states in nanocrystalline cerium oxide, *Appl. Phys. Lett* 87, 133113(1-3).

- [107] S. Tsunekawa, K. Ishikawa, Z.-Q. Li, Y. Kawazoe, and A. Kasuya (2000) Origin of Anomalous Lattice Expansion in Oxide Nanoparticles, *Phys. Rev. B* 85(16) 3440-3443.
- [108] G. Li, J. Boerio-Goates, B. F. Woodfield, and L. Li (2004): Evidence of linear lattice expansion and covalency enhancement in rutile TiO₂ nanocrystals, *Appl. Phys. Lett.* 85(11), 2059-2061.
- [109] P. G. Klemens (1966): Anharmonic Decay of Optical Phonons, *Phys. Rev.* 148(2), 845-848.
- [110] P. Mishra and K. P. Jain (2000): Temperature-dependent Raman scattering studies in nanocrystalline silicon and finite-size effects, *Phys. Rev. B* 62(22), 14790-14795.
- [111] M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, Z. V. Popović (2007): Temperature dependence of the lowest frequency E_g Raman mode in laser-synthesized anatase TiO₂ nanopowder, *Appl. Phys. A* 86, 365-371.
- [112] M. J. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. D. Dohčević-Mitrović, and Z. V. Popović (2007): Characterization of anatase TiO₂ nanopowder by variable-temperature Raman spectroscopy, *Science of Sintering (u štampi)*.
- [113] W. F. Zhang, Y. L. He, M. S. Zhang, Z. Yin and Q. Chen (2000): Raman scattering study on anatase TiO₂ nanocrystals *J. Phys. D: Appl. Phys.* 33, 912-916.
- [114] V. Swamy, A. Kuznetsov, L. S. Dubrovinsky, R. A. Caruso, D. G. Shchukin, and B. C. Muddle (2005): Finite-size and pressure effects on the Raman spectrum of nanocrystalline anatase TiO₂, *Phys. Rev. B* 71, 184302(1-11).
- [115] C. Y. Xu, P. X. Zhang, and L. Yan (2001): Blue shift of Raman peak from coated TiO₂ nanoparticles, *J. Raman Spectrosc.* 32, 862-865.
- [116] A. Pottier, S. Cassaignon, C. Chaneac, F. Villain, E. Tronc, J-P. Jolivet (2003): Size tailoring of TiO₂ anatase nanoparticles in aqueous medium and synthesis of nanocomposites. Characterization by Raman spectroscopy, *J. Mater. Chem* 13, 877-882.
- [117] J. C. Parker and R. W. Siegel (1990): Calibration of the Raman spectrum to the oxygen stoichiometry of nanophase TiO₂, *Appl. Phys. Lett.* 57, 943-945.
- [118] W. Ma, Z. Lu, and M. Zhang (1998): Investigation of structural transformations in nanophase titanium dioxide by Raman spectroscopy, *Appl. Phys. A* 66, 621-627 .
- [119] M. J. Šćepanović, M. U. Grujić-Brojčin, Z. D. Dohčević-Mitrović, and Z. V. Popović (2006): Effects of Confinement, Strain and Nonstoichiometry on Raman Spectra of Anatase TiO₂ Nanopowders, *Materials Science Forum* 518, 101-106.
- [120] J. Weidmann, Th. Dittrich, E. Konstantinova, I. Lauermann, I. Uhlendorf and F. Koch (1999): Influence of oxygen and water related surface defects on the dye sensitized TiO₂ solar cell, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* 56, 153-165.
- [121] M. Šćepanović, M. Grujić-Brojčin, Z. Dohčević-Mitrović, I. Hinić, G. Stanišić, Z. V. Popović, Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Petrovac na Moru, 3-5. jun 2004., Zbornik radova 4-145.
- [122] Y.L. Du, Y. Deng, and M.S. Zhang (2006): Variable-temperature Raman scattering study on anatase titanium dioxide nanocrystals, *Journal of Physics and chemistry of Solids* 67, 2405-2408.
- [123] K. Cai, M. Müller, J. Bossert, A. Rechtenbach, K. D. Jandt (2005): Surface structure and composition of flat titanium thin films as a function of film thickness and evaporation rate, *Appl. Surf. Sci.* 250, 252-267.

- [124] S. Balaji, Y. Djaoued and J. Robichaud (2006): Phonon confinement studies in nanocrystalline anatase-TiO₂ thin films by micro Raman spectroscopy, *J. Raman Spectrosc.* 37, 1416–1422.
- [125] Z. V. Popović, Z. Dohčević-Mitrović, A. Cros, and A. Cantarero (2007): Raman scattering study of the anharmonic effects in CeO_{2-y} nanocrystals, *J. Phys.: Condens. Matter.* 19, 496209(1-9).
- [126] M. D. Hernandez-Alonso, A. Belen Hungria, A. Martinez-Arias, J. M. Coronado, J. C. Conesa, J. Soria and M. Fernandez-Garcia (2004): Confinement effects in quasi-stoichiometric CeO₂ nanoparticles, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 6, 3524–3529.
- [127] L. Wu, H. J. Wiesmann, A. R. Moodenbaugh, R. F. Klie, Y. Zhu, D. O. Welch, and M. Suenga (2004): Oxidation state and lattice expansion of CeO_{2-x} nanoparticles as a function of particle size, *Phys. Rev. B* 69, 125415(1-9).
- [128] X. M. Lin, L. P. Li, G. S. Li and W. H. Su (2001): Transport property and Raman spectra of nanocrystalline solid solutions Ce_{0.8}Nd_{0.2}O_{2-d} with different particle size, *Mater. Chem. Phys.* 69, 236-240.
- [129] H. Deguchi, H. Yoshida, T. Inganaki, and M. Horiuchi (2005): EXAFS study of doped ceria using multiple data set fit, *Solid State Ionics* 176, 1817-1825.
- [130] G. F. Imbush (1978): Inorganic luminescence, in Ed. M. D. Lumb *Luminescence Spectroscopy*, Academic Press, London.
- [131] W. F. Zhang, M. S. Zhang, and Z. Yin (2000): Microstructures and visible photoluminescence of TiO₂ Nanocrystals, *phys. stat. sol. (a)* 179, 319-327.
- [132] L. D. Zhang and C. M. Mo (1995): Luminescence in nanostructured materials, *Nanostruct. Mater.* 6, 831-834.
- [133] P. Moriarty (2001): Nanostructured materials, *Rep. Prog. Phys.* 64, 297–381.
- [134] Y. Liu and R. O. Claus (1997): Blue Light Emitting Nanosized TiO₂ Colloids, *J. Am. Chem. Soc.* 119, 5273-5274.
- [135] T. S Kim, S. D Lester and B.G. Streetman (1967): Photoluminescence study of heat-treated InP, *J. Appl. Phys.* 61 (9), 4598-4602.
- [136] W. F. Zhang, M. S. Zhang, Z. Yin, and Q. Chen (2000): Photoluminescence in anatase titanium dioxide nanocrystals, *Appl. Phys. B* 70, 261-265.
- [137] M. Watanabe, T. Hayashi, H. Yagasaki, and S. Sasaki (2001): Luminescence process in anatase TiO₂ studied by time-resolved spectroscopy, *Int. J. Mod. Phys.* 15, 3997-4000.
- [138] T. Sekiya, S. Kamei, and S. Kurita (2000): Luminescence of anatase TiO₂ single crystals annealed in oxygen atmosphere, *J. Luminescence* 87-89, 1140-1142.
- [139] T. Sekiya, M. Tasaki, K. Wakabayashi, and S. Kurita (2004): Relaxation process in anatase TiO₂ single crystals with different colors, *J. Luminescence* 108, 69-73.
- [140] N. Hosaka, T. Sekiya, S. Kurita (1997): Excitonic state in anatase TiO₂ single crystal, *J. Luminescence* 72-74, 874-875.
- [141] C. Kittel (1986): *Introduction to solid state physics* (John Willey & Sons, New York).
- [142] M. Watanabe, S. Sasaki, and T. Hayashi (2000): Time-resolved study of photoluminescence in anatase TiO₂, *J. Lumin.* 87-89, 1234-1236.
- [143] I. Sildos, A. Suisalu, J. Aarik, T. Sekiya, and S. Kurita (2000): Self-trapped exciton emission in crystalline anatase, *J. Lumin.* 87-89, 290-292.
- [144] V.Kiisk, I.Sildos, A.Suisalu, and J.Aarik (2001): Spectral narrowing of self-trapped exciton emission in anatase thin films, *Thin Solid Films* 400, 130–133.

- [145] H. Tang, K. Prasad, R. Sanjines, P. E. Schmid, F. Levy (1994): Electrical and optical properties of TiO₂ anatase thin films, *J. Appl. Phys.* 75(4), 2042-2047.
- [146] K. Wakabayashi, Y. Yamaguchi, T. Sekiya, and S. Kurita (2005): Time-resolved luminescence spectra in colorless anatase TiO₂ single crystal, *J. Luminescence* 112, 50-53.
- [147] Y. C. Zhu, C. X. Ding (1999): Investigation on the surface state of TiO₂ ultrafine particles by luminescence, *J. Solid State Chem.* 145, 711-715.
- [148] Y. Lei, L. D. Zhang, G. W. Meng, G. H. Li, X. Y. Zhang, C. H. Liang, W. Chen, S. X. Wang, Preparation and photoluminescence of highly ordered TiO₂ nanowire arrays, *Appl. Phys. Lett.* (2001) 78(8) 1125-1127.
- [149] H. Tang, F. Levy, H. Berger, and P. E. Schmid (1995): Urbach tail of anatase TiO₂, *Phys. Rev. B* 52(11), 7771-7774.
- [150] Z. Toyozawa (1976): Elementary processes in luminescence, *J. Luminescence* 12/13, 13-21.
- [151] R. Leonelli, and J. L. Brebner (1986): Time resolved spectroscopy of the visible emission band in strontium titanate, *Phys. Rev. B* 33(12), 8649-8656.
- [152] J. He, R.K. Behera, M.W. Finniss, X. Li, E.C. Dickey, S.R. Phillipot, S.B. Sinnott (2007): Prediction of high-temperature point defect formation in TiO₂ from combined ab initio and thermodynamic calculations, *Acta Materialia* 55, 4325–4337.
- [153] M. Ramamorthy, R.D. King-Smith, D. Vanderbilt (1994): Defects on TiO₂ (110) surfaces, *Phys. Rev. B* 49, 7709 - 7715.
- [154] S. Takeda, S. Suzuki, H. Odaka, and H. Hosono (2001): Photocatalytic TiO thin film deposited onto glass by DC magnetron sputtering, *Thin Solid Films* 392, 338-344.
- [155] K. Hashimoto, M. Hiramoto, and T. Sakata (1988): Photoluminescence of TiO₂ powder and its relation with photocatalitic reactions, in Proc. Symp. on Photoelectrochemistry and Photoelectrosynthesis on Semiconducting Materials, 88-14, pp. 395, The Electrochem. Society, Pennington.
- [156] S. Guha, K. Ghosh, J. G. Keeth, S. B. Ogale, S. R. Shinde, J. R. Simpson, H. D. Drew, and T. Venkatesan (2003): Temperature-dependent optical studies of Ti_{1-x}Co_xO₂, *Appl. Phys. Lett.* 83(16), 3296-3298.
- [157] S. Perkowitz (1994): Optical Characterization of Semiconductors: Infrared, Raman, and Photoluminescence Spectroscopy, Academic Press, London.
- [158] W.G. Fateley, F.R. Dollish, N.T. McDevit, and F.F. Bentley (1972): Infrared and Raman Selection Rules for Molecular and Lattice Vibrations: The Correlation Method, John Wiley and Sons, New York.
- [159] J. E. Spanier and I. P. Herman (2000): Use of hybrid phenomenological and statistical effective-medium theories of dielectric functions to model the infrared reflectance of porous SiC films, *Phys. Rev. B* 61, 10437-10450.
- [160] Z. D. Dohčević-Mitrović (2001): Laserski indukovana sinteza Si/CN keramičkih prahova i njihova karakterizacija, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu.
- [161] F. Gervais and R. Lobbo (1997) Infrared reflectivity spectroscopy of electron-phonon interactions, *Z. Phys. B* 104, 681–686.
- [162] F. Gervais and B. Piriou (1975): Temperature dependence of transverze and longitudinal optic modes in the α and β phases of quartz, *Phys. Rev. B* 11(10), 3944-3950.

- [163] F. Gervais (1983): Infrared and Millimeter Waves, Vol. 8 in Ed. K. J. Button, New York: Academic Press.
- [164] D. W. Berreman and F. C. Unterwald (1968): Adjusting Poles and Zeros of Dielectric Dispersion to Fit Reststrahlen of PrCl_3 and LaCl_3 , Phys. Rev. 174, 791 - 799.
- [165] K. Kamaras, K-L. Barth, F. Keilmann, R. Henn, M. Reedzk, C. Thomsen, J. Kircher, L. Richards, J. L. Stehle (1995): The low temperature infrared optical functions of SrTiO_3 determined by reflectance spectroscopy and spectroscopic ellipsometry, J. Appl. Phys. 75(2), 1235-1240.
- [166] A. A. Kukharskii (1973): Plasmon-phonon coupling in GaAs, Solid State Commun. 13(11), 1761-1765.
- [167] J. F. Baumard and F. Gervais (1977): Plasmon and polar optical phonons in reduced rutile TiO_{2-x} , Phys. Rev. B 15(4), 2316-2323.
- [168] T. C. Choy (1999): Effective Medium Theory, Principles and Applications, Oxford University Press.
- [169] S. Bosch, J. Ferre-Borrull, N. Leinfellner, A. Canillas (2000): Effective dielectric function of mixtures of three or more materials: a numerical procedure for computations, Surface Science 453, 9–17.
- [170] D. A. G. Bruggeman (1935): Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen, Ann. Phys. (Leipzig) 24, 636.
- [171] Ph. J. Roussel, J. Vanhellmont, H. E. Maes (1993) Numerical aspects of the implementation of effective medium approximation models in spectroscopic ellipsometry regression software, Thin Solid Films 234, 423-427.
- [172] V. Hopfe, E. H. Korte, P. Klobes and W. Grählert (1993): Optical Data of Rough-Surfaced Ceramics: Infrared Specular and Diffuse Reflectance versus Spectra Simulation, Applied spectroscopy 47(4), 423-429.
- [173] T. G. Mayerhöfer, Z. Shen, R. Keding, and J. L. Musfeldt (2005): Optical isotropy in polycrystalline $\text{Ba}_2\text{TiSi}_2\text{O}_8$: Testing the limits of a well established concept, Phys. Rev. B 71, 184116(1-5).
- [174] M. Grujić-Brojčin, M. J. Šćepanović, Z. D. Dohčević-Mitrović, I. Hinić, B. Matović, G. Stanišić and Z. V. Popović (2005): Infrared study of laser synthesized anatase TiO_2 nanopowders, J. Phys. D: Appl. Phys. 38, 1415–1420.
- [175] S. Hayashi and H. Kanamori (1980): Infrared study of surface phonon modes in α - Fe_2O_3 microcrystals, J. Phys. C: Solid State Phys. 13 1529-1538.
- [176] S. Nakade S, Y. Saito, W. Kubo, T. Kitamura, Y. Wada and S. Yanagida (2003): Influence of TiO_2 Nanoparticle Size on Electron Diffusion and Recombination in Dye-Sensitized TiO_2 Solar Cells, J. Phys. Chem. B 107, 8607-8611.
- [177] A. M. Eppler, I. M. Ballard, and J. Nelson (2002): Charge transport in porous nanocrystalline titanium dioxide, Physica E 14, 197-202.
- [178] X. Zhu and Z. Meng (1994): The optical nonlinearity and structure for a PbO , TiO_2 , SiO_2 , and K_2O quaternary glass system, J. Appl. Phys. 75, 3756-3760.
- [179] J. Yu, X. Zhao, and Q. Zhao (2001): Photocatalytic activity of nanometer TiO_2 thin films prepared by the sol-gel method, Mat. Chem. Phys. 69, 25-29.
- [180] B. Huber, G. Hubert, and C. Ziegler (2004): Electrical properties of nanocrystalline anatase TiO_2 thin films with different crystallite size, Surface Science 566-568, 419-424.

- [181] M. Grujić-Brojčin, M. Šćepanović, Z. Dohčević-Mitrović, Z. V. Popović (2006): Infrared Study of Nonstoichiometric Anatase TiO₂ Nanopowders, *Science of Sintering* 38, 183-189.
- [182] M. Šćepanović, Z. D. Dohčević-Mitrović, I. Hinić, M. Grujić-Brojčin, G. Stanišić, and Z. V. Popović (2005): Photoluminescence of Laser-Synthesized Anatase Titanium Dioxide Nanopowders, *Mat. Sci. Forum* 494, 265-270.
- [183] Z. Popović (1985): Karakterizacija poluprovodnih materijala spektroskopskim metodama, *Elektrotehnika* 34(11), 1637-1644.
- [184] S. R. Nagel and S. E. Schnatterly (1974): Frequency dependence of the Drude relaxation time in metal films, *Phys. Rev. B* 9(4), 1299-1303.

BIOGRAFIJA

Dr Mirjana Grujić-Brojčin rođena je 1970. godine u Kragujevcu.

Diplomirala 1996. godine na Odseku za fizičku elektroniku, Smer za elektrotehničke materijale i tehnologije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Magistarski rad sa temom "Proračun molekularnih vibracija klastera jednoslojnih nanotuba" odbranila je 2001. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektrotehnički materijali i tehnologije.

Dr Mirjana Grujić-Brojčin bavi se razvojem i usavršavanjem numeričkih modela vezanih za vibracionu spektroskopiju nanostrukturnih materijala i modelovanjem vibracionih spektara u infracrvenoj i Ramanovoj spektroskopiji. Do 2008. godine ima 51 naučnu referencu, od čega 21 rad u međunarodnim časopisima, 3 u nacionalnim, a 6 radova je izlagano po pozivu na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

Od 1996. godine radi u Centru za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku u Zemunu.

Prilog 1.

Izjava o autorstvu

Potpisana Mirjana Grujić-Brojčin
Broj indeksa 0760/50

Izjavljujem

da je doktorska disertacija pod naslovom

Optička spektroskopija oksidnih nanoprahova

- rezultat sopstvenog istraživačkog rada,
- da predložena disertacija u celini ni u delovima nije bila predložena za dobijanje bilo koje diplome prema studijskim programima drugih visokoškolskih ustanova,
- da su rezultati korektno navedeni i
- da nisam kršio/la autorska prava i koristio intelektualnu svojinu drugih lica.

Potpis doktoranda

U Beogradu, 20.06.2013. godine



Prilog 2.

**Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije
doktorskog rada**

Ime i prezime autora Mirjana Grujić-Brojčin

Broj indeksa 0760/50

Studijski program

Naslov rada Optička spektroskopija oksidnih nanoprahova

Mentor prof. dr Zoran V. Popović

Potpisana Mirjana Grujić-Brojčin

Izjavljujem da je štampana verzija mog doktorskog rada istovetna elektronskoj verziji koju sam predala za objavlјivanje na portalu **Digitalnog repozitorijuma Univerziteta u Beogradu**.

Dozvoljavam da se objave moji lični podaci vezani za dobijanje akademskog zvanja doktora nauka, kao što su ime i prezime, godina i mesto rođenja i datum odbrane rada.

Ovi lični podaci mogu se objaviti na mrežnim stranicama digitalne biblioteke, u elektronskom katalogu i u publikacijama Univerziteta u Beogradu.

Potpis doktoranda

U Beogradu, 20.06.2013. godine



Prilog 3.

Izjava o korišćenju

Ovlašćujem Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ da u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu unese moju doktorsku disertaciju pod naslovom:

Optička spektroskopija oksidnih nanoprahova

koja je moje autorsko delo.

Disertaciju sa svim prilozima predala sam u elektronskom formatu pogodnom za trajno arhiviranje.

Moju doktorsku disertaciju pohranjenu u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu mogu da koriste svi koji poštuju odredbe sadržane u odabranom tipu licence Kreativne zajednice (Creative Commons) za koju sam se odlučila.

1. Autorstvo

2. Autorstvo - nekomercijalno

3. Autorstvo – nekomercijalno – bez prerade

4. Autorstvo – nekomercijalno – deliti pod istim uslovima

5. Autorstvo – bez prerade

6. Autorstvo – deliti pod istim uslovima

(Molimo da zaokružite samo jednu od šest ponu_enih licenci, kratak opis licenci dat je na poleđini lista).

Potpis doktoranda

U Beogradu, 20.06.2013. godine



1. Autorstvo - Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora na način određen od strane autora ili davaoca licence, čak i u komercijalne svrhe. Ovo je najslobodnija od svih licenci.
2. Autorstvo – nekomercijalno. Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora na način određen od strane autora ili davaoca licence. Ova licenca ne dozvoljava komercijalnu upotrebu dela.
3. Autorstvo - nekomercijalno – bez prerade. Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, bez promena, preoblikovanja ili upotrebe dela u svom delu, ako se navede ime autora na način određen od strane autora ili davaoca licence. Ova licenca ne dozvoljava komercijalnu upotrebu dela. U odnosu na sve ostale licence, ovom licencom se ograničava najveći obim prava korišćenja dela.
4. Autorstvo - nekomercijalno – deliti pod istim uslovima. Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora na na_in određen od strane autora ili davaoca licence i ako se prerada distribuira pod istom ili sličnom licencom. Ova licenca ne dozvoljava komercijalnu upotrebu dela i prerada.
5. Autorstvo – bez prerade. Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, bez promena, preoblikovanja ili upotrebe dela u svom delu, ako se navede ime autora na način određen od strane autora ili davaoca licence. Ova licenca dozvoljava komercijalnu upotrebu dela.
6. Autorstvo - deliti pod istim uslovima. Dozvoljavate umnožavanje, distribuciju i javno saopštavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora na način određen od strane autora ili davaoca licence i ako se prerada distribuira pod istom ili sličnom licencom. Ova licenca dozvoljava komercijalnu upotrebu dela i prerada. Slična je softverskim licencama, odnosno licencama otvorenog koda.